

CMM手册

适用于版本 2017 R1



生成日期：2016年12月19日
Hexagon Manufacturing Intelligence

目录

PC-DMIS CMM	1
PC-DMIS 测量机	1
PC-DMIS CMM介绍	1
入门	2
入门：简介	2
简要教程	3
创建及使用测头	26
定义星型测头	26
创建及使用测头 介绍	33
定义测头	34
使用不同的测头选件	75
使用测头工具框	76
使用测头工具栏 介绍	76
使用侧头位置	80
查看触测目标	83
提供和使用特征定位器指导	84
使用接触路径属性	87
使用样例接触点属性	94

使用接触自动移动属性	117
使用接触查找孔属性	119
计算“查找孔”距离	129
使用测量策略	131
使用自适应扫描策略	134
使用非自适应扫描策略	186
使用 TTP 策略	198
CMM QuickMeasure 工具栏	230
创建坐标系	237
创建一个坐标系	237
测量特征	237
测量特征：介绍	237
插入测量特征	239
插入自动特征	249
扫描	315
执行高级扫描	316
创建快速扫描	361
执行基本扫描	363
手动执行扫描简介	389

Printed

术语表	409
索引	411

PC-DMIS CMM

- PC-DMIS CMM : 简介
- 入门
- 设置和使用测头
- 使用测头工具箱
- 使用测量策略
- CMM QuickMeasure 工具栏
- 创建坐标系
- 测量特征
- 扫描

PC-DMIS 测量机

PC-DMIS CMM介绍



PC-DMIS 64 位版本 (x64) 中没有 B & S Backtalk、Embedded Board、Manmiti、Manmora、Metrocom、Mitutoyo GPIB、GeoCom、GOM、LK、Numerex、Omniman 以及使用并行端口驱动程序的任何软件。ManualCMM 和 Tech80 减少了该功能。

欢迎使用 PC-DMIS CMM。本文介绍了 PC-DMIS CMM 软件包。特定而言，本文涵盖使用坐标测量机 (CMM) 和 PC-DMIS 创建和运行测量程序的项目。同时还涵盖通过接触测头进行接触触测及与 CMM 相关的其他主题。

这些主题包括：

- 入门
- 设置和使用测头
- 使用测头工具箱
- 使用测量策略
- CMM QuickMeasure 工具栏
- 创建坐标系
- 测量特征
- 扫描

有关一般 PC-DMIS 选项的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档。有关便携测量机、视频或激光设备、或 PC-DMIS 的其他特定配置的信息，请参见其他文档项目之一。

如果您对 PC-DMIS 不熟悉，想要了解其功能，请参见“入门”并在系统上遵循相关说明。

入门

入门：简介

PC-DMIS

是一个强大的软件应用程序，具有大量的选项和实用的功能。本节提供教程，您可按照此教程创建和执行测量程序。此教程并不打算对您进行有关 PC-DMIS 详细信息方面的训练。但是，如果您不了解 PC-DMIS，它会向您简略展示软件。

随着您的进展，您将熟悉以下功能：

- 创建测量程序
- 定义和校准测头
- 使用视图
- 测量零件特征

- 创建坐标系
- 设置首选项
- 添加程序员注释
- 构造特征
- 创建尺寸

随后，您将熟悉以下功能：

- 执行测量程序
- 查看和打印报告

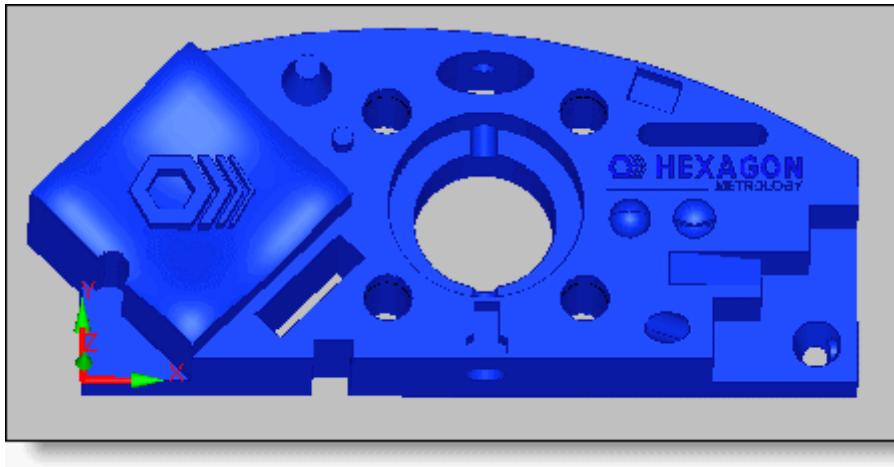
由于经历是最好的老师之一，如果您未执行过这些操作，请启动 CMM，然后启动 PC-DMIS。

若无联机版本的 PC-DMIS，可在脱机模式下遵照本教程的步骤执行操作。

简要教程

本章将引导您创建简单测量程序，并在联机模式下使用 CMM 测量零件。本章还会向您展示 PC-DMIS 可进行的操作。若对所述步骤中讨论的功能有疑问，请参考 PC-DMIS 核心文档。

此教程使用了 Hexagon 测试块：



Hexagon 测试块

若要在联机模式下对测量机执行实际操作，且您并没有此零件，则可使用允许测量多个圆和一个圆锥的类似零件。

 若是采用脱机模式（无CMM）工作，可导入测试块模型，通过鼠标点按零件来执行以下一些步骤，替代在联机模式下通过检测来采集实际的测点。PC-DMIS 在安装过程中安装此模型。该模型位于 PC-DMIS 的安装目录中。若要使用此模型，请导入文件 "HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE.igs"。相关信息请参阅 PC-DMIS 核心文档的“导入 CAD 数据”。

要创建测量程序，您将使用联机 PC-DMIS，而非使用 CAD 数据。开始之前，请遵照“CMM 启动和复位程序”中详述的步骤启动 CMM。

如果您不熟悉某个过程，请使用本文档获得详细信息。

本教程引导您完成以下步骤：

CMM启动和回家过程

第 1 步：创建新的测量例程

步骤2：“定义测头”。

步骤 3：设置视图

步骤 4：测量坐标系特征

步骤 5：缩放图像

步骤6：创建坐标系

步骤 7：设置首选项

步骤 8：添加注释

步骤9：测量其他特征

步骤10:根据存在特征构造新特征

步骤11：计算评价

步骤12：标记执行项目

步骤13：设置报告输出

第 14 步：执行完成的测量例程

第 15 步：打印报告

CMM启动和回家过程

您可使用联机 PC-DMIS 执行现有测量程序，检查零件（或零件截面），并在 CMM 上直接开发测量程序。仅当运行 PC-DMIS 的计算机连接至 CMM 时，可使用联机 PC-DMIS。脱机程序设计技术在联机模式时可用。

联机PC-DMIS的CMM启动和回家过程

1. 打开 CMM 的气源。

2. 给控制器加电

- 根据不同的机器模式，这可能是一个安装在后面的机器或工作站上的大型的旋转开关·开/关键·或一个小摇杆开关控制器。
- 手型控件（示教盒）上的所有 LED 将亮约 45 秒。之后将关闭几个 LED。



3. 打开计算机及其所有外围设备的电源。

4. 登录计算机。

5. 要启动 PC-DMIS 联机版本，在 PC-DMIS 程序群组的联机图标上双击鼠标左键：

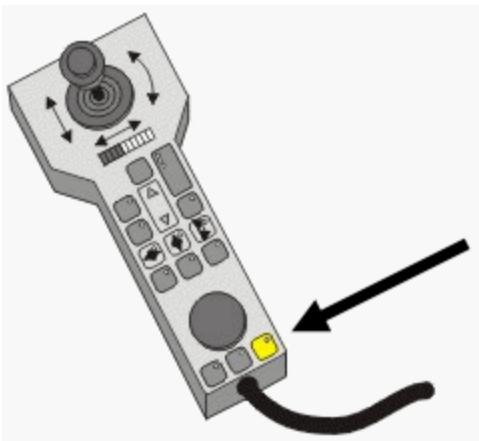


6. 复位 CMM。PC-DMIS 打开后，屏幕上会显示一条消息：

PC-DMIS 消息：

执行一次测量机启动(如果需要)，然后按“确定”回家

- 按示教盒上的启动机器按钮，直到 LED 亮起。
- 若要“复位”CMM，正确地将机器清零和启用机器参数（速度、大小限制等）。按上述 PC-DMIS 消息中的确定按钮。CMM 将缓慢移至原点位置，将此位置作为所有轴的零位。



警告：执行此操作时，测量机将移动。为避免受伤，请远离测量机。为避免硬件损坏，请以较低速度运行测量机。

第 1 步：创建新的测量例程

要创建新的测量例程：

1. 若尚未创建新测量例程，请启动 PC-DMIS。屏幕上将出现**打开**对话框。若之前已创建测量例程，可从此对话框加载此例程。
2. 由于您正在创建新的测量例程，请选择**取消**按钮关闭此对话框。
3. 选择**文件 | 新建**，打开新建测量例程对话框。

4. 在零件名称框中键入：**TEST**
5. 在修订号框中输入修订号并在**序列号**框中输入序列号。
6. 在单位列表中选择**英寸**。
7. 选择**界面**列表中的**联机**。若 PC-DMIS 未连接 CMM，则选择**脱机**。
8. 单击**确定**。PC-DMIS 创建新的测量例程。

然后，PC-DMIS 将打开主要用户界面和测头工具对话框供您加载测头。

步骤2：“定义测头”。

使用测头 **工具**对话框（**插入 | 硬件定义 | 测头**）选择现有测头或定义新测头。创建新测量例程时，PC-DMIS 将自动显示此对话框。更多信息，请参阅“设置和使用测头”一章中的“定义测头”。

使用测头工具对话框中的测头说明区域可定义测头、扩展名以及测量程序中将用到的测尖。测头说明列表以字母顺序显示可用测头选项。

要加载测头：

1. 在测头文件框中键入测头名称。随后在创建其他测量程序时，可在此对话框中选择此测头。
2. 选择语句：“**未定义测头**。”
3. 使用鼠标光标或使用箭头键突出显示测头说明列表中所需的测头。按 **Enter**。
4. 选择“**空连接 #1**”行，继续选择需要的测头零件，直至构建测头。



空连接 #1 行

5. 完成后单击**确定**按钮。测头工具对话框关闭。PC-DMIS 返回主界面。
6. 验证测尖是否显示为活动测尖。(请参见设置工具栏上的测尖列表。)



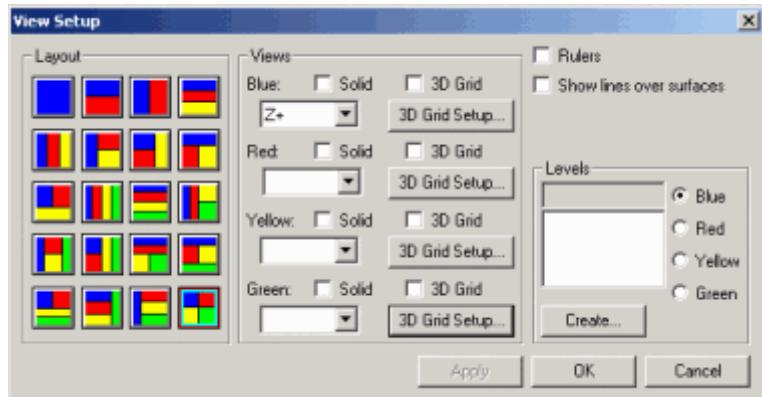
使用测头前，需校准测尖角度。本教程不涵盖校准过程。校准过程将在“设置和使用测头”一章中的“校准测尖”主题中进行了详细讨论。

此时，您将使用图形模式工具栏上的视图设置图标 ()
设置“图形显示”窗口中将使用的视图。



您也可单击精灵工具栏上的测头精灵图标 ()，访问 PC-DMIS“测头精灵”。“测头精灵”可帮助您定义测头。您也可使用测头工具对话框定义测头。

步骤 3：设置视图



视图设置对话框

使用视图设置对话框更改“图形显示”窗口中的视图。要访问此对话框，单击图形模式工具栏上的视图设置图标 。或者，选择**编辑 | 图形显示窗口 | 视图设置**。

1. 在视图设置对话框中选择所需的屏幕样式。在本教程中，单击第二个按钮（顶行，从左起第二个），该按钮指示水平拆分窗口：



按钮

2. 若要查看 Z+ 方向的上部零件图像，请在视图区域中的蓝色列表中选择 Z+。
3. 若要查看 Y- 方向的下部零件图像，请在红色列表中选择 Y-。
4. 单击 应用 按钮。PC-DMIS

会使用选定的两个视图重新绘制“图形显示”窗口。由于您尚未测量零件，PC-DMIS 未在“图形显示”窗口中绘制任何内容。但屏幕将根据选定的视图进行拆分。



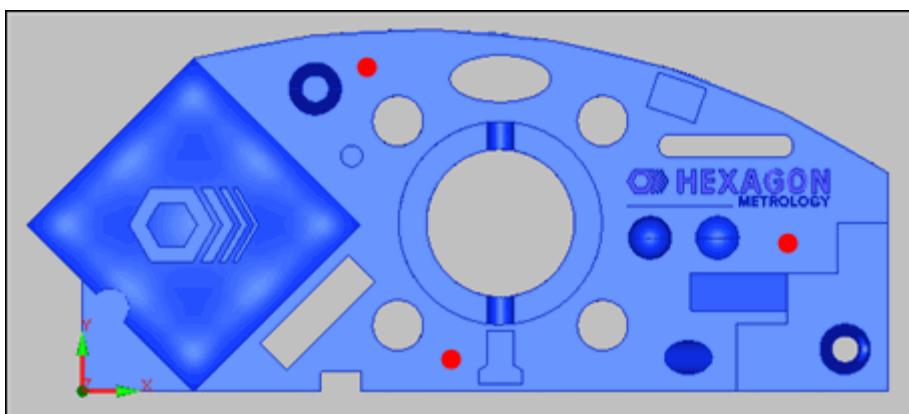
显示选项仅影响 PC-DMIS

显示零件图像的方式。不影响测量数据或检查结果。

第四步：测量这些坐标系特征

定义并显示测头后，即可开始测量过程并测量坐标系特征。更多信息参见“测量特征”。

测量平面



红点表明零件曲面上可能的测点位置

1. 采集测点前要检查 PC-DMIS

是否设置为“程序”模式。要执行此操作，选择图形模式工具栏上的**程序模式**图标
()。

2. 在顶曲面上采三个测点。这三个测点的形状应为三角形，并且尽可能向外扩展。

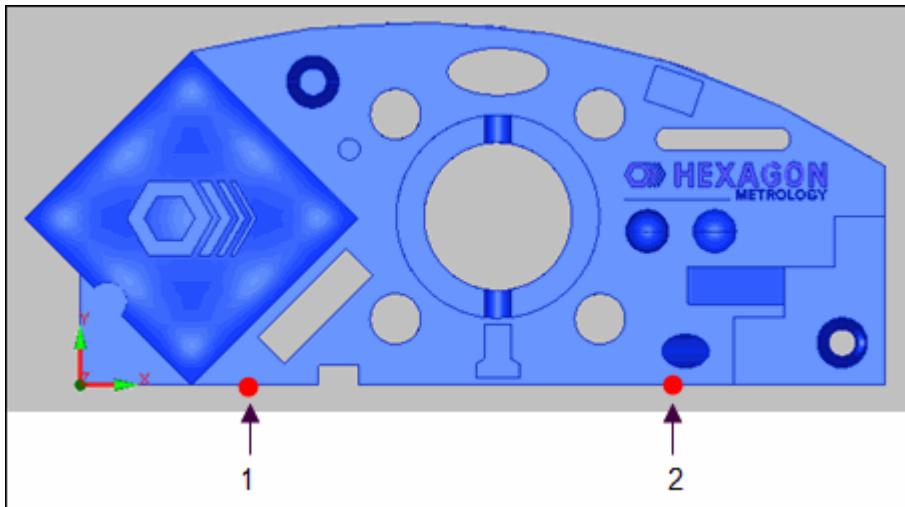
3. 在顶部表面上取三个测点。这些测点构成三角形，并尽量展开。



采点时，PC-DMIS

会在测点缓冲区内存储测点。若所采测点错误，可按键盘上的 ALT + - (减号) 从测点缓冲区删除，然后重新采点。准备就绪时，按 END 完成特征测量。

测量直线



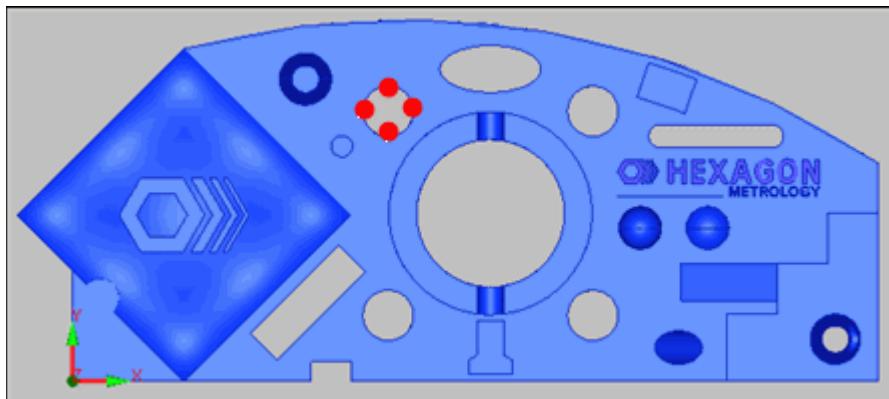
红点表明可能的测点位置

1. 若要测量直线，请在边缘下方零件的侧面上取两个测点；在零件左侧采集第一个测点，在第一个测点的右侧采集第二个测点。

测量特征时，方向非常重要。PC-DMIS 使用此信息创建坐标系。

2. 取第二个测点后按 END 键。PC-DMIS 会在“图形显示”窗口中显示特征 ID 并测量线。

测量圆



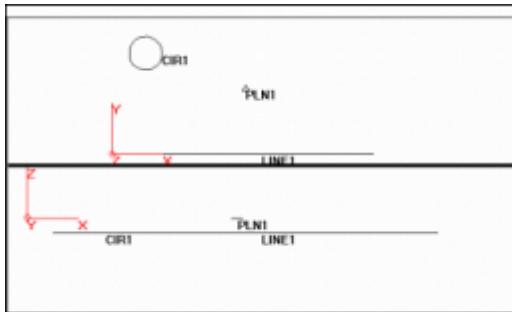
红点表明可能的测点位置

1. 移动测头到圆心。(对于此例，选择左上角的圆。)
2. 将测头降至孔中，然后测量圆。在圆周围大致相等距离处采集四个测点。
3. 取完最后一个测点后按 END 键。PC-DMIS 会在“图形显示”窗口中显示特征 ID 并测量圆。

步骤5：缩放图示

图形模式工具栏上的缩放到适合图标 () 会缩放“图形显示”窗口中的图像。

测量三个特征后，单击缩放到适合图标（或选择**操作 | 图形显示窗口 | 缩放到适合**），在“图形显示”窗口中显示所有测量的特征。



带测量特征的“图形显示”窗口

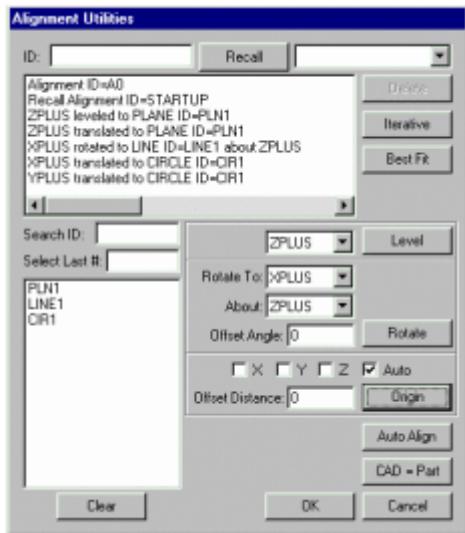
测量过程的下一步是创建坐标系。

步骤 6：创建坐标系

此程序设置坐标原点，定义 X、Y 和 Z 轴。有关创建坐标系的详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“创建和使用坐标系”一章。

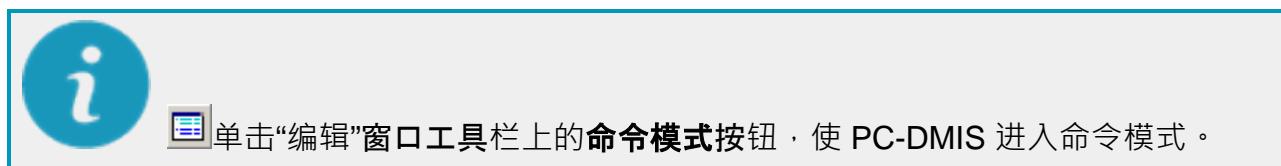
1. 选择**插入 | 坐标系 | 添加**，打开坐标系工具对话框。
2. 使用光标或箭号键选择列表框中的平面特征 ID (PLN1)。若未更改选项卡，列表框中的平面特征 ID 将显示为 "F1" (对于特征 1)。
3. 单击**找正**按钮，以确定当前工作平面法向轴的方向。
4. 再次选择该平面特征标识 (PLN1 或 F1)。
5. 选中**自动**复选框。
6. 单击**原点**按钮。此操作会将零件原点转换为 (或移至) 具体的位置 (本示例中位于平面上)。要根据特征类型和此特征的方向移动轴，请选择**自动**复选框。
7. 选择直线特征标识 (LINE1 或 F2)。
8. 单击**旋转**按钮。此操作会将已定义的工作平面轴旋转至此特征。PC-DMIS 围绕作为原点使用的质心旋转定义的轴。
9. 选择圆特征标识 (CIR1 或 F3)。
10. 确保已选中**自动**复选框。
11. 单击**原点**按钮。此操作会将原点移至圆心，同时与平面保持水平。

此时**坐标系工具**对话框应与下图相同：



带当前坐标系的“坐标系工具”对话框

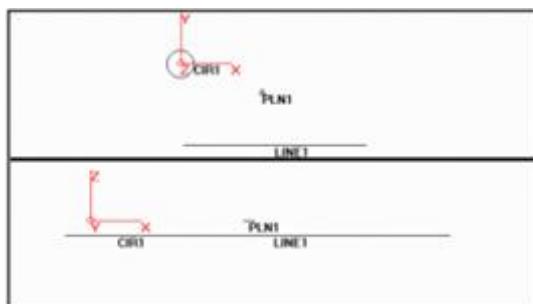
完成上述步骤后，单击**确定**。坐标系列表（位于设置工具栏上）和“编辑”窗口的**命令模式**会显示新的坐标系。



```
A1      -ALIGNMENT/START,RECALL:A2, LIST= YES
      ALIGNMENT/LEVEL, ZPLUS, PLN1
      ALIGNMENT/TRANS, XAXIS, PLN1
      ALIGNMENT/ROTATE, XPLUS, TO, LINE1, ABOUT, ZPLUS
      ALIGNMENT/TRANS, XAXIS, CIR1
      ALIGNMENT/TRANS, YAXIS, CIR1
      ALIGNMENT/END
```

带新坐标系的“编辑”窗口

“图形显示”窗口也会进行更新并显示当前的坐标系：



带当前坐标系的更新“图形显示”窗口



以后，您可使用精灵工具栏上的 按钮，访问 PC-DMIS 的“3-2-1 坐标系精灵”。

步骤 7：设置首选项

您可自定义 PC-DMIS，以满足您的特定需求和首选项。[编辑 |](#)

首选项菜单上有许多选项。本节仅讨论适用于此练习的选项。有关所有选项的完整信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“设置首选项”一章。

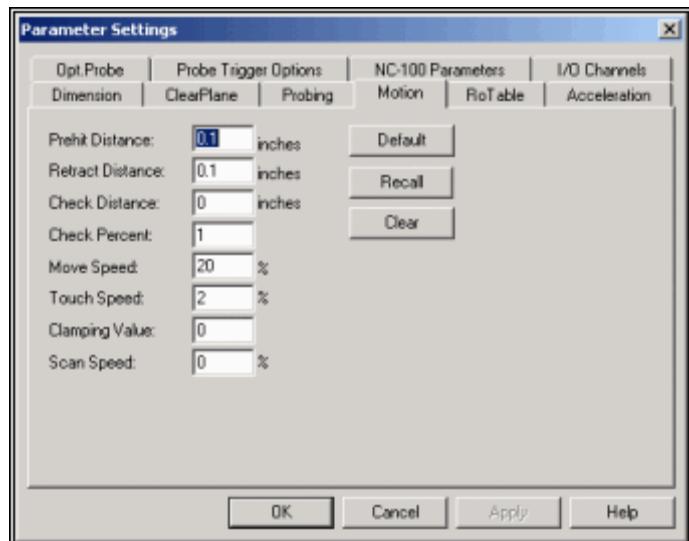
进入 DCC 模式

选择 DCC 模式。要执行此操作，单击测头模式工具栏上的 **DCC 模式** 按钮 。或者，将光标放在直线上，在命令模式下在“编辑”窗口中读取“模式/手动”，然后按 F8 键。

“编辑”窗口中的命令显示：[模式 /DCC](#)

有关 CMM 模式的更多信息，请参见“使用工具栏”一章中的“测头模式工具栏”。

设置移动速度



“参数设置”对话框 - “运动”选项卡

使用**移动速度**选项更改 CMM 的点对点定位速度。

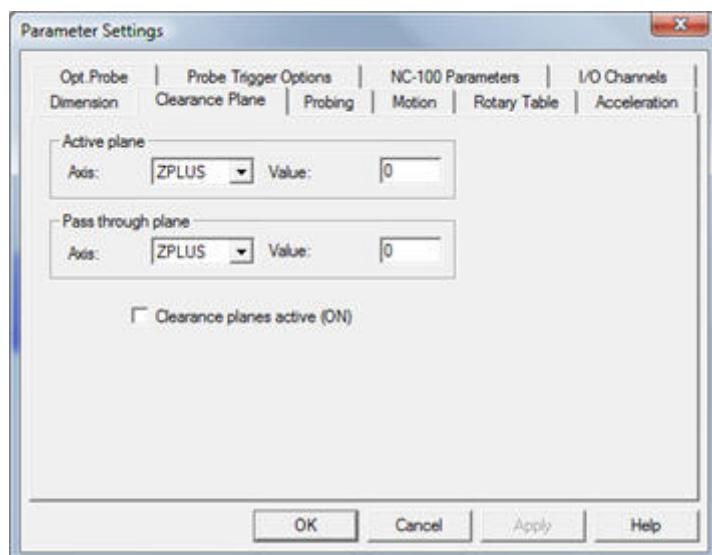
1. 选择**编辑 | 首选项 | 参数**打开参数设置对话框。
2. 选择**运动**选项卡。
3. 将光标放在**移动速度**框中。
4. 选择当前的移动速度值。
5. 键入**50**。此值表明机器全速的百分比。

根据该设置，PC-DMIS

将以最快速度的一半移动坐标测量机。其它选项的默认设置符合该练习的需要。

有关“**移动速度**”和其他移动选项的更多信息，请参见 PC-DMIS
核心文档“设置首选项”一章中的“参数设置：移动选项卡”。

设置安全平面



“参数设置”对话框 - “安全平面”选项卡

若要设置安全平面：

1. 选择**编辑 | 首选项 | 参数**打开参数设置对话框。
2. 选择**安全平面**标签

3. 选中**激活安全平面（开）** 复选框。
4. 选择当前的**活动平面值**。
5. 键入值 **.50**。此设置将围绕零件的顶面创建一个半英寸的安全平面。
6. 检查顶部平面是否显示为活动平面。
7. 单击**应用** 按钮。
8. 单击**确定**按钮。关闭对话框。PC-DMIS 将此安全平面保存在“编辑”窗口中。



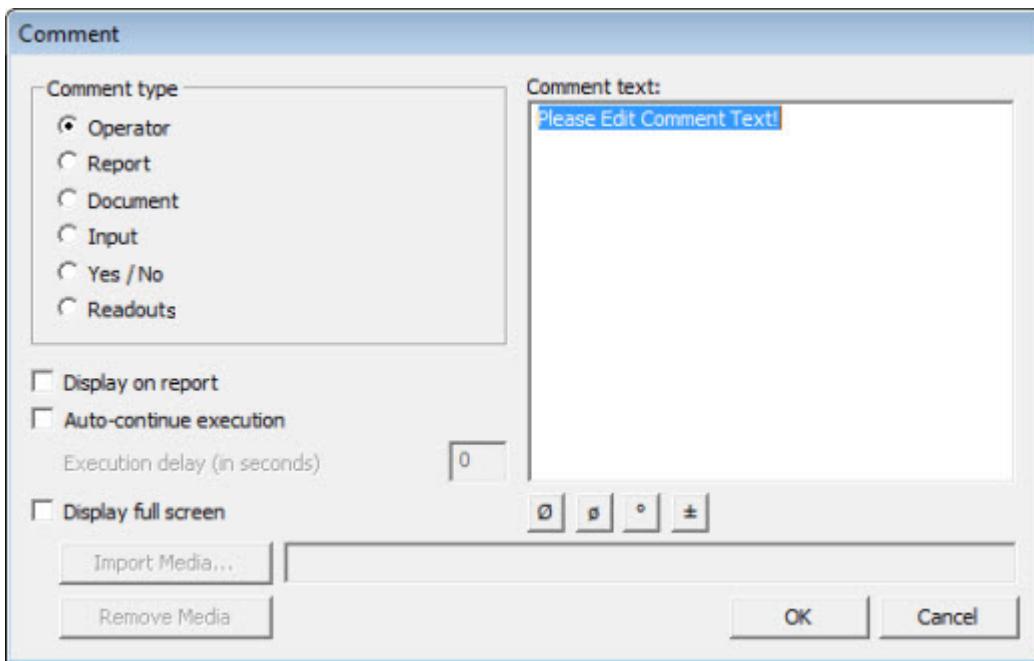
从图形项目工具栏选择**安全平面**图标
，可在“图形显示”窗口中将目前的安全平面显示为一个半透明图像。

有关设置安全平面的更多信息，请参见 PC-DMIS
核心文档“设置首选项”一章中的“参数设置：安全平面选项卡”。

步骤8：添加注释

要添加注释，请执行以下步骤：

1. 选择**插入 | 报告命令 | 注释**，打开注释对话框。
2. 选择**操作员**选项。
3. 在注释文本框中键入以下文本：“**警告， 测量机即将进入 DCC 模式。**”



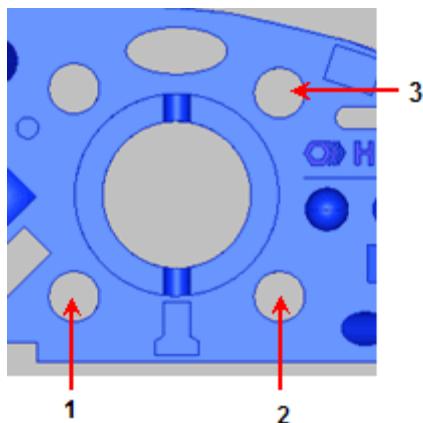
注释对话框

4. 单击**确定**按钮结束该选项，“编辑”窗口中将显示该命令。

有关更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“插入程序员注释”。

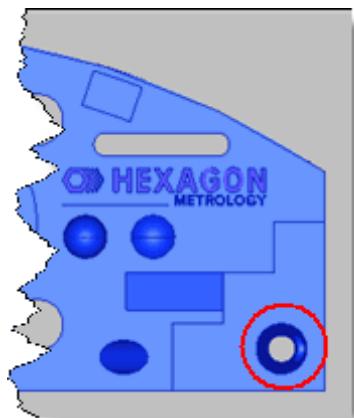
步骤 9：测量其他特征

按照标明的顺序（项目1为圆2，项目2为圆3，项目3为圆4）使用测头测量这三个另外的圆：



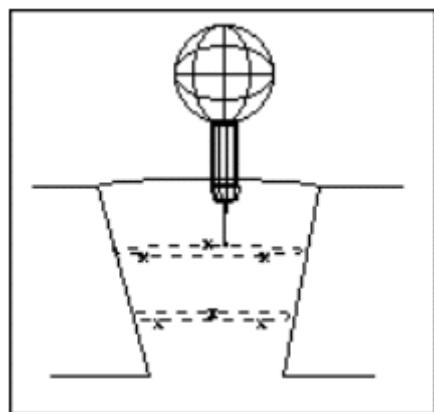
圆

接着一个圆锥：



圆锥

若要测量圆锥，按照如下图所示，最好在上层和下层各取三个测点。



通过不同深度的测量构造的锥体

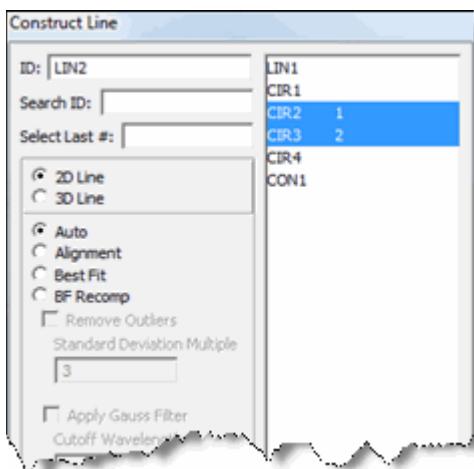


对于 3D 测量特征（圆环、圆柱、球体、圆锥和平面）和 2D 平面特征，PC-DMIS 会使用阴影曲面显示特征。

步骤 10：从现有特征构造新特征

PC-DMIS 可以使用其他特征创建特征。操作如下：

1. 选择 **插入 | 特征 | 构造特征 | 直线**，打开**构造直线对话框**。

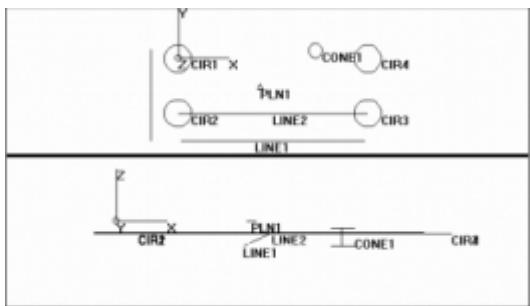


构造直线对话框

2. 使用鼠标光标单击“图形显示”窗口中的两个圆（CIR2、CIR3）（或从**构造直线对话框**的列表框选择这两个圆）。选择圆后，PC-DMIS 会突出显示该圆。
3. 选择**自动**选项。
4. 选择**2D 直线**选项。
5. 点击**创建**按钮。

PC-DMIS 采用最有效的构造法创建直线 (LINE2)。

这条直线和特征 ID 将显示在“图形显示”窗口和“编辑”窗口中：



“图形显示”窗口中的构造直线

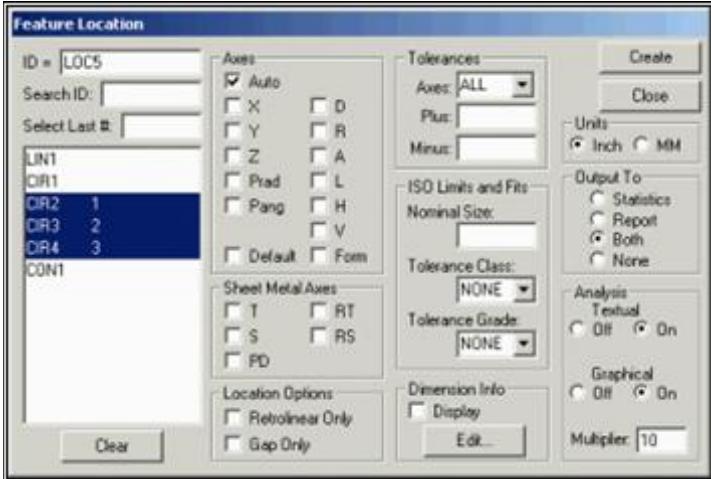
有关构造特征的更多信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“从现有特征构造新特征”一章。

步骤 11：计算尺寸

创建特征后，即可计算此特征的尺寸。学习测量例程时，可随时生成尺寸，并且可量身定做以适合其规范。PC-DMIS 将在“编辑”窗口中显示各尺寸操作的结果。

要生成尺寸，请执行以下步骤：

1. 选择**插入 | 尺寸**，确保已选择**使用传统尺寸**菜单项（其旁边显示有复选标记）。
2. 选择**插入 | 尺寸 | 位置**，打开**特征位置**对话框。
3. 从列表或“图形显示”窗口内选择最后三个圆，这些圆通过在列表中选择其特征标识进行测量。



“特征位置”对话框中选择的最后三个圆

- 单击创建按钮。PC-DMIS 将在“编辑”窗口中显示这三个圆的位置：

Edit Window - Tutorial.PRS									
IN DIM LOC2= LOCATION OF CIRCLE CIR2									
	AX	NOMINAL	+TOE	-TOE	MEAS	MAX	MIN	DEV	OUTOF
	X	0 .9535	0 .0000	0 .0000	0 .9535	1 .4780	0 .4810	0 .0000	0 .0000
	Y	1 .0725	0 .0000	0 .0000	1 .0725	1 .5020	0 .7171	0 .0000	0 .0000
	Z	1 .0404	0 .0000	0 .0000	1 .0404	1 .0500	1 .0331	0 .0000	0 .0000
POINTDATA HIT# MEAS X Y Z VEC I J K DEVIATION									
	X CIR2	0	0 .9535	1 .0725	0 .9894	1 .0000	0 .0000	0 .0000	0 .0000
	Y	0	0 .9535	1 .0725	0 .9894	0 .0000	1 .0000	0 .0000	0 .0000
IN DIM LOC3= LOCATION OF CIRCLE CIR3									
	AX	NOMINAL	+TOE	-TOE	MEAS	MAX	MIN	DEV	OUTOF
	X	0 .9535	0 .0000	0 .0000	0 .9535	0 .5080	0 .0000	0 .0000	0 .0000
	Y	3 .0260	0 .0000	0 .0000	3 .0260	3 .2517	2 .7939	0 .0000	0 .0000
	Z	0 .9893	0 .0000	0 .0000	0 .9893	0 .9839	0 .0000	0 .0000	0 .0000
POINTDATA HIT# MEAS X Y Z VEC I J K DEVIATION									
	X CIR3	0	0 .9535	3 .0260	0 .9894	1 .0000	0 .0000	0 .0000	0 .0000
	Y	0	0 .9535	3 .0260	0 .9894	0 .0000	1 .0000	0 .0000	0 .0000
IN DIM LOC4= LOCATION OF CIRCLE CIR4									
	AX	NOMINAL	+TOE	-TOE	MEAS	MAX	MIN	DEV	OUTOF
	X	0 .0318	0 .0000	0 .0000	0 .0318	0 .5240	0 .5192	0 .0000	0 .0000
	Y	1 .0161	0 .0000	0 .0000	1 .0161	1 .0163	0 .0034	0 .0000	0 .0000
	Z	0 .0416	0 .0000	0 .0000	0 .0416	0 .0451	0 .0031	0 .0000	0 .0000
POINTDATA HIT# MEAS X Y Z VEC I J K DEVIATION									
	X CIR4	0	0 .0318	1 .0161	0 .9894	1 .0000	0 .0000	0 .0000	0 .0000
	Y	0	0 .0318	1 .0161	0 .9894	0 .0000	1 .0000	0 .0000	0 .0000

“编辑”窗口显示三个圆的位置尺寸

要更改这些值，双击所需直线，突出显示必要的标称值，然后键入新值。

有关创建尺寸的其他信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“使用传统尺寸”一章。

步骤 12：标记执行项目

您可使用“标记”有选择地选择在测量程序中执行的元素。本教程中，标记所有特征。

1. 使用**编辑 | 标记 | 全部标记**菜单项（在 PC-DMIS

核心文档的“编辑测量程序”一章中），标记测量程序中的所有特征。一旦标记，选择的特征将会以当前突出显示颜色进行显示。

2. PC-DMIS 询问是否可以标记手动建坐标系特征。单击**是**。

步骤13：设置报告输出

PC-DMIS 可将最终报告发送至文件或打印机。在此教程中，将报告发送至打印机。

1. 选择**文件 | 打印 | 报告窗口打印设置**。屏幕上将出现输出配置对话框。

2. 选中**打印机**复选框。

3. 单击**确定**。

此时具备充足的信息，允许 PC-DMIS 执行已创建的测量例程。

第 14 步：执行完成的测量例程

可使用各种各样的选项，来执行全部或部分测量程序。请参见 PC-DMIS
核心文档中的“执行测量程序”一章。

执行上述所有步骤后：

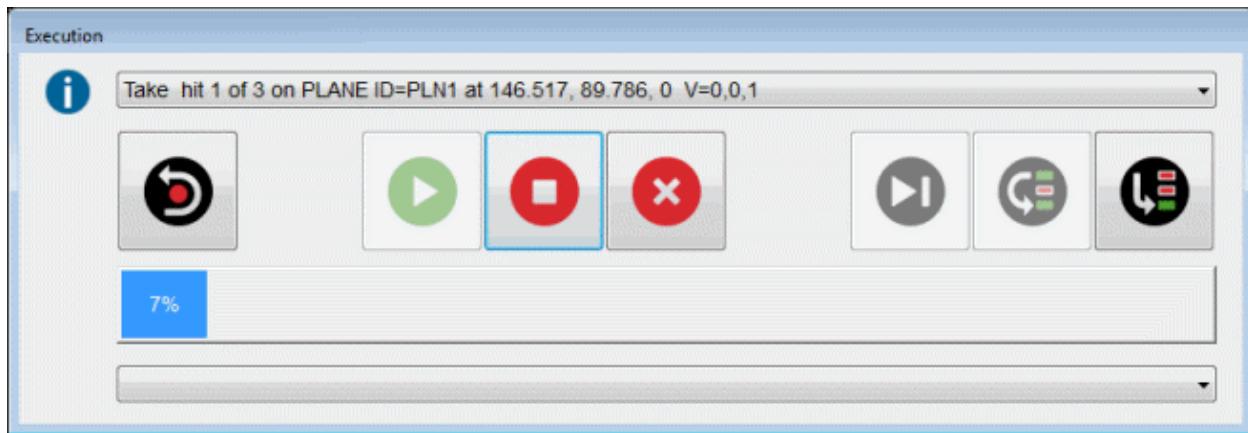
1. 选择**文件 | 执行**。PC-DMIS 显示**执行**对话框并开始进行测量。

2. 阅读**执行**对话框中的说明。按照请求采集指定的测点。

3. PC-DMIS 要求您在“图形显示”窗口中所示的大概位置采集这些测点。

- 在曲面上采集三个测点创建平面。按 End。
- 在边缘上采集两个测点创建直线。按 End。
- 在圆内采集四个测点。按 End。

4. 采了每个测点之后，单击继续。



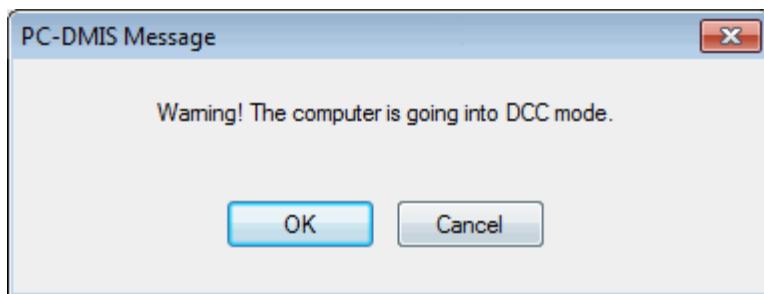
“执行”对话框中的说明

如果 PC-DMIS

检测到错误，该错误将显示在对话框的测量机错误列表中。您将需采取行动，这样测量程序才能继续进行。

在圆上采集最后一个测点后，PC-DMIS 会显示 **PC-DMIS 消息**

消息对话框，此框显示消息：“警告，测量机即将进入 DCC 模式。”单击**确定**后，PC-DMIS 将自动测量其余特征。



PC-DMIS 消息

如果 PC-DMIS

遇到错误，您可使用**执行**对话框中的**测量机错误**列表确定错误原因。采取必要的操作解决此问题。单击**继续**按钮完成测量程序的执行。

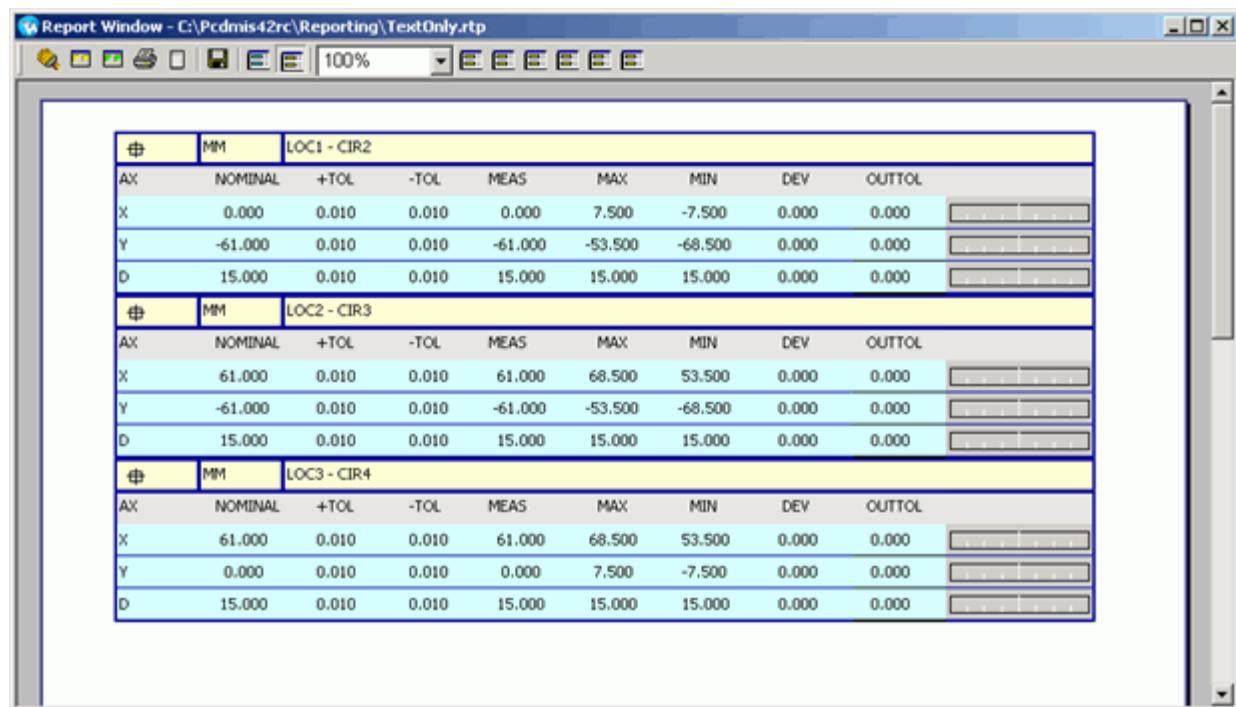
有关**执行**对话框中选项的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“使用**执行**对话框”主题。

第 15 步：打印报告

在 PC-DMIS 执行测量程序后，它会将报告自动打印至在输出配置对话框（文件 | 打印 | 报告窗口打印设置）中指定的输出源中。由于在先前的步骤中选择了打印机复选框，报告将被发送到打印机。确保打印机联机并打开。

您也可选择视图 | 报告窗口，在“报告”窗口内查看最终报告。对数据应用 PC-DMIS 随附的不同预制报告模板，可在“报告”窗口中显示相同测量数据的不同形式。您也可右击报告的不同部分，切换可用项目的显示。

有关 PC-DMIS 报告功能的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“报告测量结果”一章。



样品报告在其他信息关闭的情况下使用纯文本模版显示三位置尺寸。

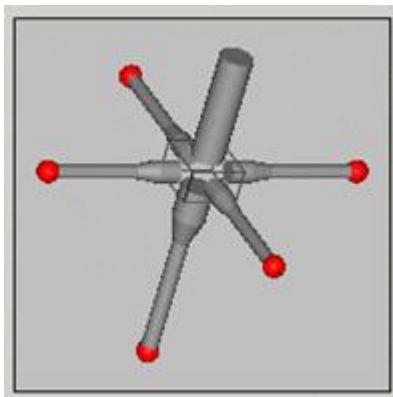
恭喜您！您已经学完了本教程。

创建及使用测头

定义星型测头

PC-DMIS

允许您定义、校准并使用多个不同的星测头配置。一个星测头包含一个垂直（若使用垂直臂，则为 Z 方向）指向 CMM 平台的测头测尖，以及四个水平指向的其他测尖。例如：



一种类型的星型测针配置

此部分描述如何构建星型测头。

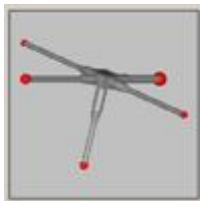


对于多种不同的测量机类型和臂结构，该方法和样例可以设想使用标准的垂直臂测量机，测量机的臂从 Z- 方向指向 CMM 平台。

构建星型测头

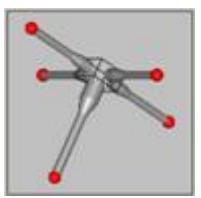
您能构建这些星型测头的结构：

- **具有不同测尖的五向自定义星测头。五向自定义星测头。**此类型星测头使用一个由五个螺纹孔组成的中心立体，您可将各种测头测尖拧到这些螺纹孔中。



五向自定义星测头

- 具有相同测头测尖的非自定义星测头。非自定义星测头。此类型的星型测头没有自定义5方向中心。虽然此类型测头具有立体，但无螺纹孔，且四个水平测尖永久附着于该立体。这些水平测尖大小相同。

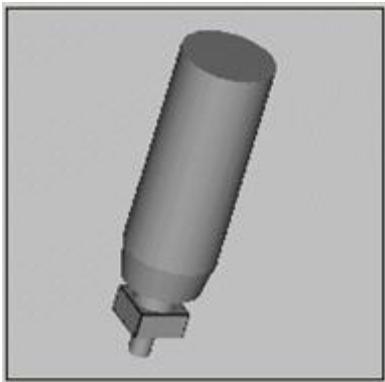


非自定义星测头

建立测头后，使用测头工具工具箱中的测量按钮校准它。有关校准测尖的信息，请参见“测量”。

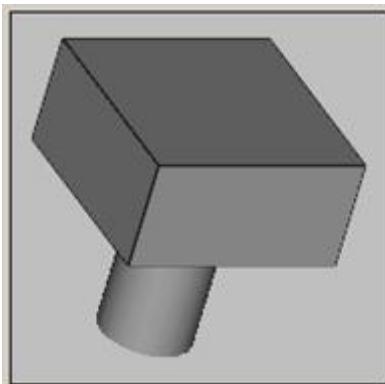
构建 5 - 方向自定义星型测头

1. 访问测头工具对话框(**插入|硬件定义|测头**)。
2. 在测头文件框中输入测头文件的名称。
3. 在测头说明区域中选择**无定义的测头**。
4. 从测头说明列表选择测头。此文档使用 **PROBETP2** 测头。该测头图形应类似于此：



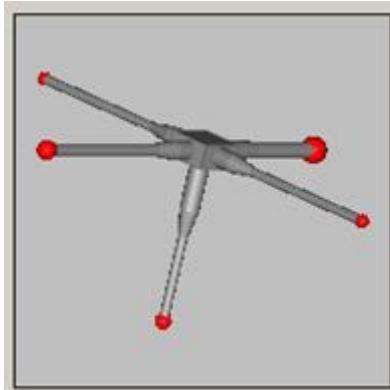
测头图纸

5. 从视图隐藏测头。若要隐藏测头，双击测头说明区域中的 PROBETP2 连接，并取消选择**绘制此组件**复选框。
6. 在测头说明区域中选择**空连接 #1**。
7. 在测头说明列表中选择 5 路立体扩充 EXTEN5WAY。五个空连接将出现在测头说明区域中。测头图纸显示为：



测头图纸

8. 在每个**空连接**处赋以合适的测针或需要的扩展项，直到达到五根总测针，例如此处的显示：



总共五个测尖

你不一定要填充所有的五个连接。

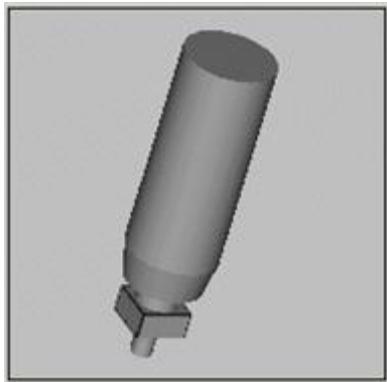
分配到**空连接 # 1** 的测尖与其所位于的轨道指向相同。为 Z 方向。

- 分配到**空连接 # 2** 的测尖指向 X+ 方向。
- 此测针赋值到**空联结 # 3**指向Y+方向。
- 此测针赋值到**空联结 # 4**指向X-方向。
- 此测针赋值到**空联结 # 5**指向Y-方向。

9. 单击**确定**保存更改，或单击测量校验测头。有关校准测尖的信息，请参见“**校准测头测尖**”。

构建先前定义的星型测头

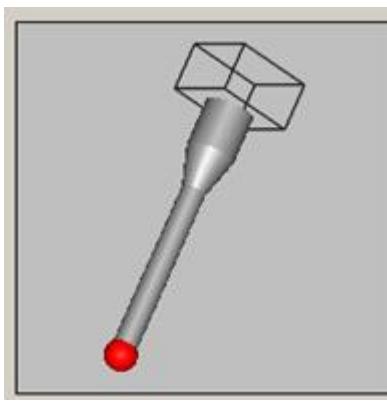
1. 访问测头工具对话框(**插入|硬件定义|测头**)。
2. 在测头文件框中输入测头文件的名称。
3. 在测头说明区域中选择**无定义的测头**。
4. 在测头说明列表中选择测头。此文档使用 **PROBETP2** 测头。该测头图形应类似于此：



测头图纸

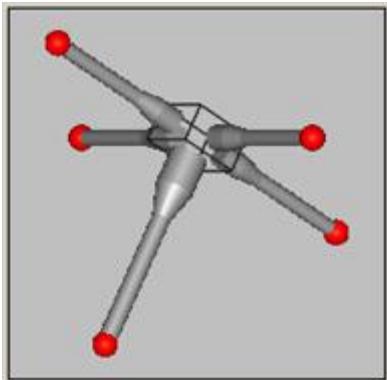
5. 从视图隐藏测头。若要隐藏测头，请双击测头说明区域上的 PROBETP2 连接，并取消选择**绘制此组件**复选框。
6. 在测头说明区域中选择**空连接 #1**。
7. 选择 2BY18MMSTAR 或 r 10BY6.5STAR.

此文件使用2BY18MMSTAR。此测针的绘图将显示:



测头图纸

8. 对于测头说明区域中四个**空连接**项目中的每一项，选择相同的测头测尖四次，每个水平测尖一次。在此情况下，您可选择四次 TIPSTAR2BY30 或 TIPSTAR2BY18。此文档使用的是 TIPSTAR2BY30。

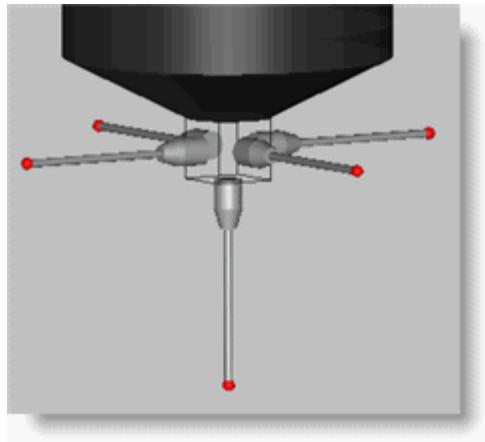


图纸

9. 单击**确定**保存更改，或单击测量校验测头。有关校准测尖的信息，请参见“**校准测头测尖**”。

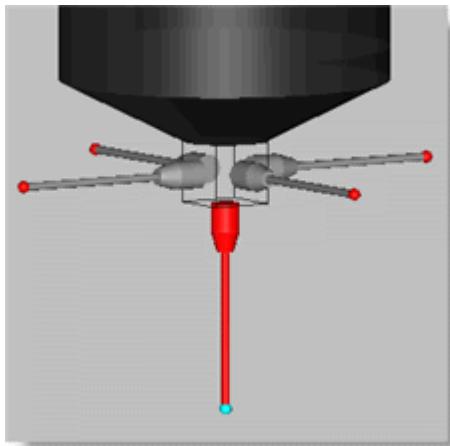
突出显示当前测针

在测头参数设置包含了多测头关节以及测针像如下所示：PC-DMIS为你提供了一种方法让您知道在任何给定时间哪个测针是活动测针。



多测针的测头参数设置

对于 4.3 版或更高版本的 PC-DMIS，当光标置于“编辑”窗口中使用活动测尖的某个命令上时，PC-DMIS 将自动在“图形显示”窗口中突出显示整个测头杆和测尖：



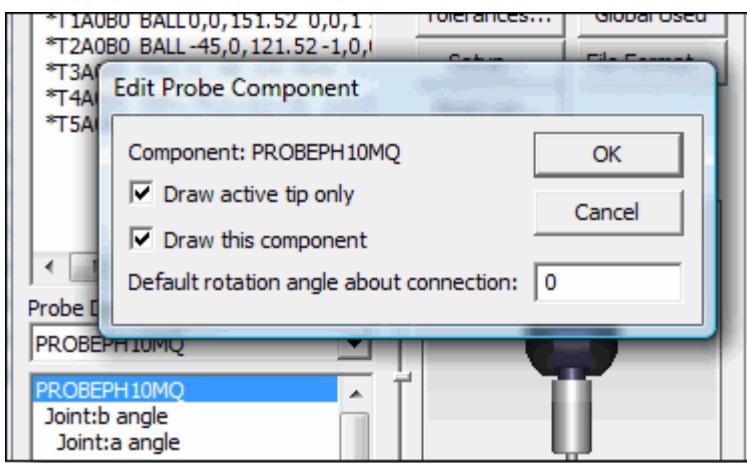
突出显示的活动测尖的测头参数设置

只显示当前测尖

类似于突出显示活动测尖，可在标星的测头上隐藏所有不使用的测尖，这样只有当前测尖可见。要执行此操作，在**编辑测头组件**对话框中选择**仅绘制活动测尖**复选框。如果未选择该选项，PC-DMIS 会使用突出显示当前测尖的默认模式。

只显示当前测尖：

1. 选择**插入 | 硬件定义 | 测头**（或在测量程序中星测头的 **LOADPROBE** 命令上按 F9）。屏幕上会显示**测头工具**对话框。
2. 双击测头说明区域中的测头组件。屏幕上会出现**编辑测头组件**对话框。
3. 选择**只绘制活动测尖**复选框。



编辑测头组件对话框中的仅绘制活动测尖复选框

4. 单击此对话框和测头工具对话框中的**确定**。

现在当测量程序执行测尖命令时，任何非活动的测尖将隐藏起来。

创建及使用测头 介绍

若要使用测量机测量零件，你需要正确定义你将会在测量中使用的测头。你通过你的测头系统的硬件组成来定义你的测头：传感器，测座，加长杆，以及指定的测针。一旦定义后，你可以校验之前定义过的需要在你测量零件特征时用到的角度。通过校验测针PC-DMIS将会知道你的测针与你的零件坐标系以及机器坐标系的关系。

定义测头并校准测尖之后，可在测量例程中使用 LOAD/PROBE 和 LOAD/TIP 命令，以在例程测量中使用校准的测尖角度。

若要定义和校准测头，请参见以下主题：

- 定义测头
- 校验测针



PC-DMIS

核心文档中的“了解测头工具对话框”主题在定义和校准测头时非常有用。

完成校准后，请参见“使用不同测头选项”查看在脱机和联机模式下使用测头的信息。

定义测头

CMM

编程的第一步为定义将在检验流程期间使用的测头。在测量流程开始之前，您必须已为新的测量程序创建和/或加载测头文件。在加载测头之前，测量程序中仅可完成很少的操作。

PC-DMIS 支持多种多样的测头类型和标定工具。它为校验 Renishaw PH9/PH10 测座提供了独特的方法。用于定义测头并校准测头的工具均在**测头工具**对话框中。要访问该对话框，选择**插入 | 硬件定义 | 测头**。有关此对话框中的各选项的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“了解测头工具对话框”。



您也可使用 PC-DMIS

测头向导来定义测头。若要访问测头向导，请单击向导工具栏上的 按钮。

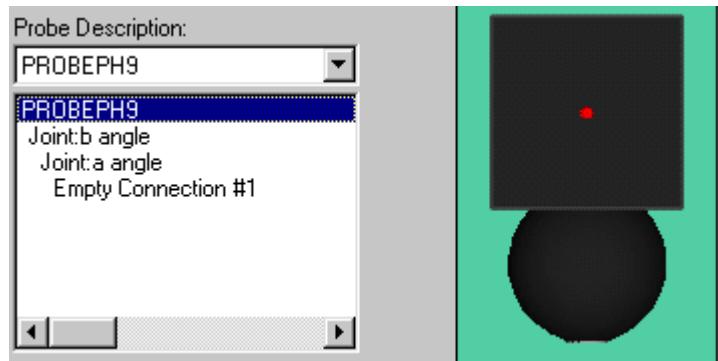
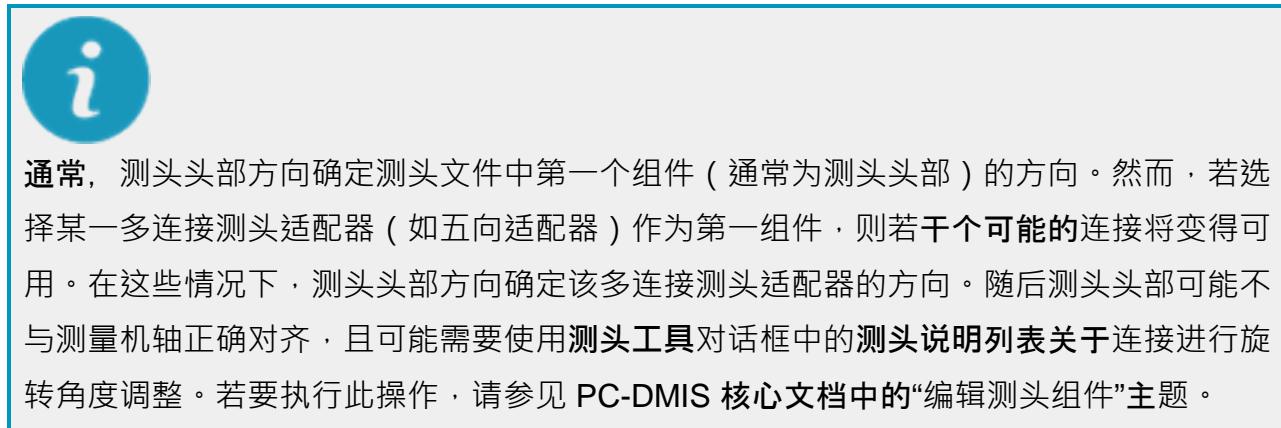
定义触发测头

若已打开**测头工具**对话框（**插入 | 硬件定义 | 测头**），则可定义整个测头单元，从测头和加长杆向下到特定测尖。

若要定义接触测头、扩充和测尖：

1. 在**测头文件**列表中键入新测头的名称。
2. 选择**未 定义**的测头语句：在**测头说明**列表中。

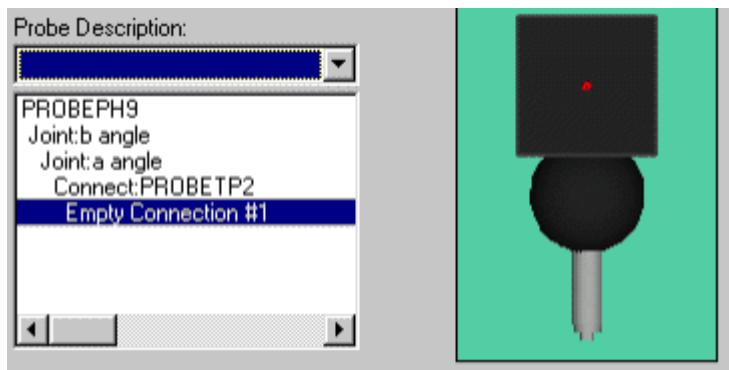
3. 选择测头说明列表。
4. 选择所需的测头。
5. 选择测头后按 Enter 键。与当前突出显示的语句相关的测头选项将为可选择状态。



选择测座

所选测头将显示在靠下的测头说明框中以及右侧的图形显示框中。

1. 突出显示测头说明框中的**空连接 #1**。
2. 单击列表。
3. 选择要附加到测头上的下一项（扩展或测尖）。测尖将先按大小显示，再按螺纹尺寸显示。



选择测尖



您可以合适的测尖填充任何或所有所需的连接。PC-DMIS
将始终首先测量扩充中最低的测尖 (Z 轴中最低的测尖) 。



5 向扩展

如果在测头说明框中选择一个已包含有项目的行，PC-DMIS
将显示一条消息，询问您是否要在所选项之前插入或将其替换。

单击“是”在前面插入，或单击“否”将其替换。

- 若单击**是**，则可通过在原始项当前插入新测尖来创建一条附加线。
- 若单击**否**，则 PC-DMIS 将删除原始项目，并以突出显示的元素对其进行替换。



所选项将在测头说明框中的突出显示行上插入。PC-DMIS 将显示一条消息，允许您在标记的行之前插入所选项目，或视需要替换突出显示的项目。

继续选择元素直到所有的空连接被定义好。可以定义校验所用的测尖角度。

定义硬测头

PC-

DMIS也允许您定义硬（或固定）测头。当接触触发测头（TTP）与工件表面发生接触时测量机就会记录当前的测头位置，但硬测头的工作方式不同于此。相反的，硬测头在你点击机器上或者臂上或者，扫描时，当遇到某种情况时（例如穿过一个预先设定的区域，随着时间，随着距离，如此向前）。

总体上，这些种类的测头常常用在PC-DMIS关节臂式测量机。如果使用这种测头，请参考“PC-DMIS Portable”文档校准和使用此测头类型。

校验测针

校准测尖将告知 PC-DMIS

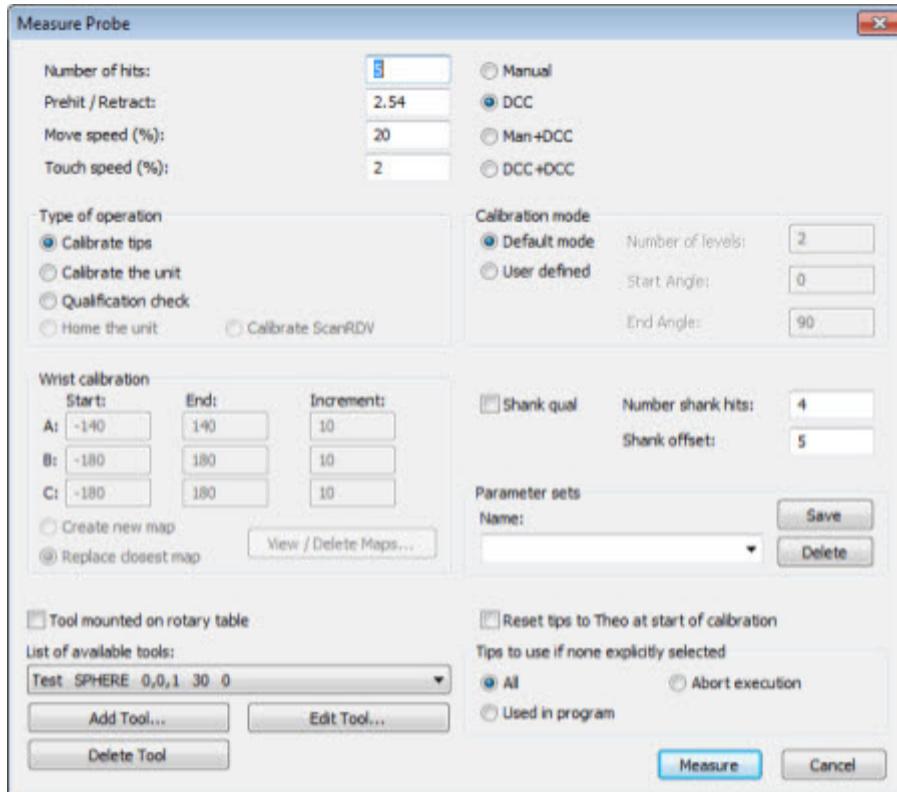
测尖的位置和直径。校准测尖之前，您不可执行测量程序和测量零件。可交替使用术语“校准”和“校验”。

开始校准过程：

1. 确保测头工具对话框（**插入 | 硬件定义 | 测头**）中的活动测尖列表具有所需的测尖角度。
2. 从列表中选择要校准的测头测尖。
3. 单击测量，显示测量测头对话框。



若有测头更换架，且当前的活动测头文件**并非**测头中的测头配置，则
PC-DMIS 将自动抛弃当前加载的测头配置，并拾取所需的配置。



测量测头对话框

测量测头对话框显示测头校验时可用于测量的各种设置。一旦选择了所需的设置，单击**测量**即可开始。

预先校准的需求

要开始校准流程，必须定义一个校验工具。将在该工具上进行的测量类型视工具类型（一般为球体）和测尖类型（球状、盘状、锥状、杆状、光学）而定。

- 要从列表中选择当前定义的校验工具，单击**可用工具列表**。
- 要定义将添加至可用工具列表中的新校验工具，单击**添加工具**。

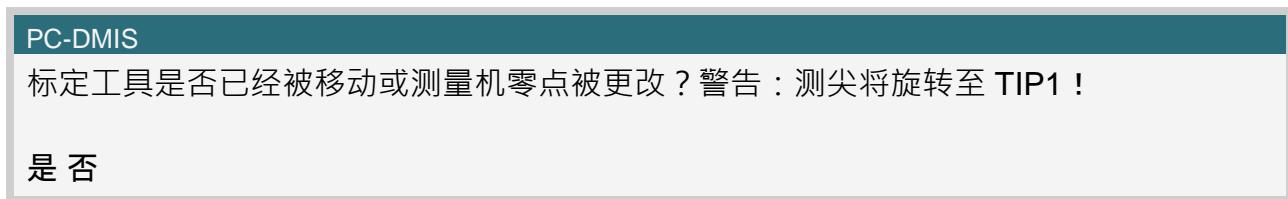
- 要更改当前定义的校验工具的配置，单击**编辑工具**。
- 要删除当前定义的校验工具，单击**删除工具**。

一旦校准开始

根据您的测量机使用 DCC 测点定位标定工具的能力，PC-DMIS 会显示两种样式的消息之一，询问是否已移动标定工具：

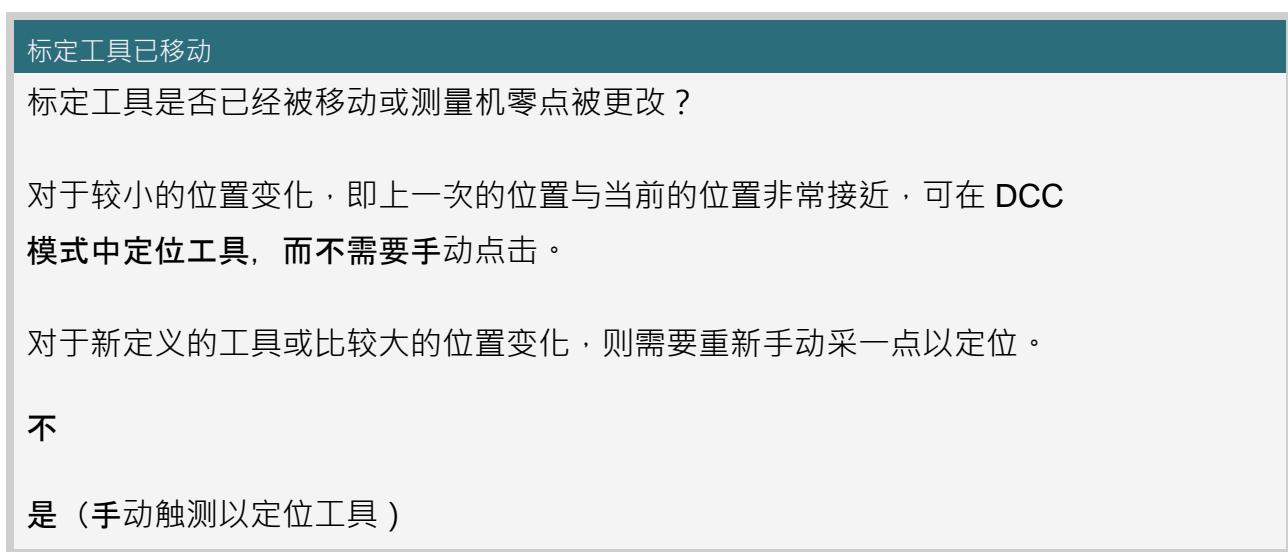
是/否消息框

对于不支持使用DCC触测（比如仅手动的机器）定位标定工具的机器，消息框会出现：



标定工具已移动对话框

若用户的测量机器和测头配置支持使用DCC触测来定位标定工具的能力，该对话框出现：
：



是 (DCC 触测以定位工具)

- 若选择**是或**是 (手动触测或查找工具) , PC-DMIS
会显示**执行**对话框。继续校准过程前 , 它需要您在手动模式 (取决于工具类型) 下
采取一个或多个测点。
- 若选择**是 (DCC 触测以定位工具)** , PC-DMIS
会显示**执行**对话框 , 并且自动尝试使用 DCC
触测以定位标定工具。当将标定工具重新放置于与先前位置几乎相同的位置上时可
使用此选项。
- 若选择**否** , PC-DMIS
也会显示**执行**对话框。但不要求任何手动触测 , 除非适用选定的测量方法 (例如在
手动模式下进行操作) 。

完成测量后 , PC-DMIS

会计算相应类型测头、所使用的工具以及所请求操作的检验结果。**标定工具已移动**对话框
中的两个**是**选项的区别仅对测量时是否需要手动触测造成影响。为了测量后计算 , 两个
是选项相同。

校准之后 , 测头工具对话框中的**活动测尖列表**中将显示每个测尖的简要概括。要查看详
细校准结果 , 单击该对话框中的**结果**。

重新校验

通常 , PC-DMIS

不能确定是否需要重新校准测头测尖。若测头有任何更改 , 请确保重新进行校准。

测点数

Number of Hits:

“测点数”框

PC-DMIS 根据校准模式使用所指示数目的测点来测量测头。默认测点数为 5。

逼近距离/回退距离

Prehit / Retract:

“逼近/回退”框

使用**逼近/回退**框可定义离开零件或校准工具的距离。PC-DMIS

的速度减小至定义的触测速度，同时处于距离之内。其保持在触测速度直到采集了测尖且再次达到距离。届时，PC-DMIS 返回定义的移动速度。



一些控制器不自动回退。在这些情况下，PC-DMIS
发出回退动作，且距离以球面至零件理论测点位置为基础。若控制器未回退，则从球面或
球心至理论或测量的测点位置计算距离（取决于控制器）。

移动速度

Move Speed:

“移动速度”框

使用**移动速度**框可指定 PH9 校准的移动速度。根据设置选项对话框的**零件 /**

测量机选项卡中的**显示绝对速度**复选框的状态，**移动速度**框和**触测速度**框可接受绝对速
度（毫米/秒）或测量机定义的最高速度的百分比。

有关影响测量流程中速度的其他方法，请参见 PC-DMIS

核心文档的“设置首选项”一章中的“移动速度 %”。



移动速度框中的数字不得多于四位小数。若输入超过四位十进制的数值，PC-
DMIS 将在第四位处进行舍入。

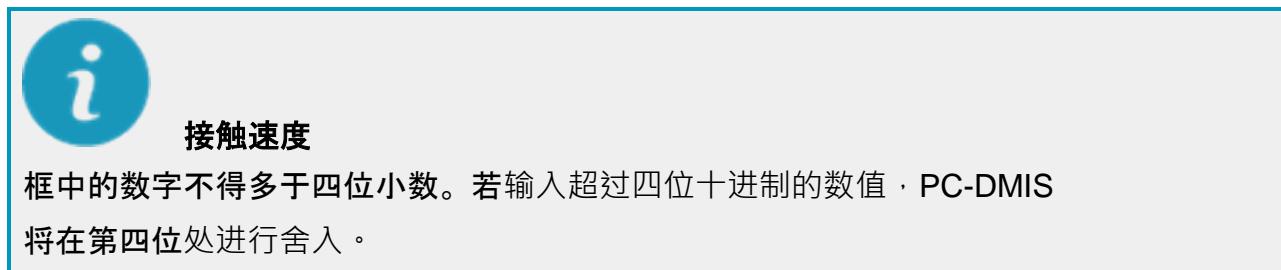
触测速度

Touch Speed:

“触测速度”框

使用触测速度框指定 PH9 校准的触测速度。根据设置选项对话框的零件 / 测量机选项卡中的显示绝对速度复选框的状态，移动速度框和触测速度框可接受绝对速度（毫米/秒）或测量机定义的最高速度的百分比。

更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中“设置首选项”一章中的“触测速度 %”。



系统模式



系统模式

用于校准测头的系统模式包括：

- 手动模式要求手动采所有测点，即使坐标测量机具有 DCC 功能。
- DCC CMM 使用 DCC 模式。它自动采集所有测点，除非已移动校验工具。在此情况下，您必须手动采集第一个测点。
- 手动 +DCC 模式为手动和 DCC 模式的混合模式。此模式有助于校准不易模拟的奇异测头配置。在多数情况下，手动 +DCC 类似于 DCC 模式，但存在以下不同：
 - 必须要手动为每个测尖采第一个测点，即使标定工具尚未移动。该测尖的所有其他测点将在 DCC 模式下自动采集。
 - 因为所有第一次触测均手动执行，所以对每个测尖不进行测量前的安全移动。

- PC-DMIS

完成指定测尖的球体测量后，根据所使用的测座类型，可能会也可能不会执行结束回退移动。

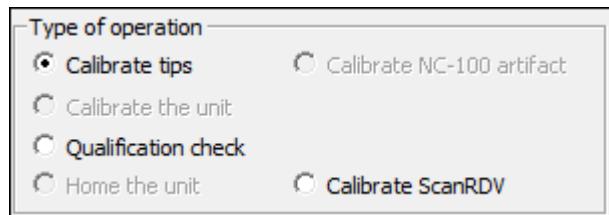
如果有可移动的测座（例如 PH9、PH10、PHS 等），PC-DMIS 将象在正常的 DCC 模式下一样执行结束回退移动。因为在继续后将不会出现提示，因此，应确保测头有足够的安全空间移动到下一个测尖的 AB 角并执行下一次 AB 移动。

如果没有可移动测座，PC-DMIS

不会执行结束回退移动。而是直接提示进行下一个测尖的手动触测。

- DCC+DCC 模式功能除了手动为每个测针采第一个测点外，与 MAN+DCC 模式类似，PC-DMIS 用 DCC 模式在球体上测点。如果想全部过程都是自动校准，则此模式非常有用。但是，注意使用 MAN+DCC 模式会获得更准确的结果。

操作类型区域



“操作类型”区域

使用操作类型区域选择当单击测量测头对话框中的测量按钮时 PC-DMIS 执行的操作。

校准测尖

使用此选项可对所有标记测尖的进行标准校准。

校准装置

此选项创建无限测座设备和可分度测座设备的错误映射。有关可分度测座设备的信息，请参见以下信息。有关无限测座设备的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用测座设备”附录中的“校准无限测座设备的装置”。



该选项只在单个臂配置时有效。

校准装置（适用于可分度测座设备）

使用此选项对测头头部或测座设备进行错误映射。此节说明对可分度测头头部进行错误映射（如 PH9、PH10 或 Zeiss RDS）。一种由三个直径相同的测尖组成的特殊测头设置置于测头头部中，且以此测头设置测量用户所需的多个测尖方向（所有可能的方向为最佳）。通常，应将“T”设置中的测尖安置为至少 20mm 高，40mm 宽（类似于星测头，其中测尖距中心 20mm）。测尖隔离的愈远，错误映射将愈准确。

一旦使用特殊设置完成测量所有可能的方向，您将可以更改测头设置，而不需进行校准整个测尖列表。在新的配置中，现将自动校准原始映射中测量的每个方向。对于校准和使用所有 Renishaw 和 DEA 测头头部以及 Zeiss RDS 头部，PC-DMIS 提供完整的支持。

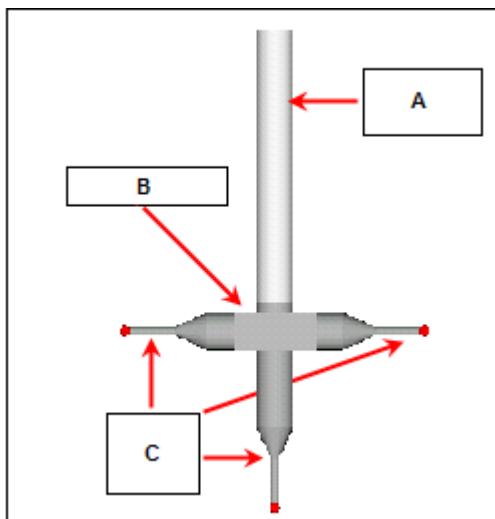


正如此处的介绍，该选项专门针对具有可重复分度测座位置的测头（例如 PH10）。该校准需要三方向的星形测头。执行该校准后，只有在校准测座时标定的分度位置可用在以后测头文件中，而无需执行完全校准。使用模拟测头时，无论测头的类型是无极分度还是可分度，校准装置选项都不可用。这是因为模拟测头必须拥有彼此单独的校准位置来获得所需的偏移系数。

有关校验测座的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“使用测座设备”一章。

可分度测座设备的“校准装置”过程

1. 创建类似于下图中测头配置的装置测头配置：



A - 50 mm 扩充

B - 5 路中心

C - 三个 3BY20 测尖

2. 组件的准确大小可能会变化，但形状**必须保持不变**。同时最佳选择尽可能轻的组件。
· 重力可能会导致测量中生成某些错误。
3. 在测头工具对话框中，单击**添加角度**按钮。添加尽可能多的不同方向。测头头部完整映射意味着测量各个可能的方向。
4. 在测头工具对话框中选择**测量**按钮。屏幕上将显示**测量测头**对话框。
5. 输入要使用的默认值
6. 针对要执行的操作类型，选择**校准装置**。
7. 在**测量测头**对话框中，单击**测量**按钮。随后 PC-DMIS
将在所选方向的每个方向上测量三个测尖中的每个测尖。PC-DMIS
将使用此数据来映射各方向的偏置、间距和偏转。
8. 在测头头部上进行要用于测量的测头配置。
9. 选择至少三个映射方位。

10. 在测头工具对话框中选择**使用装置校准数据**复选框。

11. 在所选方向上校准此测头。要执行此操作：

- 在测头工具对话框上单击测量。屏幕上将显示测量测头对话框。
- 从此菜单中选择**校验测尖**。
- 单击测量测头对话框中的**测量**按钮。然后，PC-DMIS会针对此测头配置计算实际长度偏置。PC-DMIS为每个映射的方向自动创建测尖。

低级矩阵

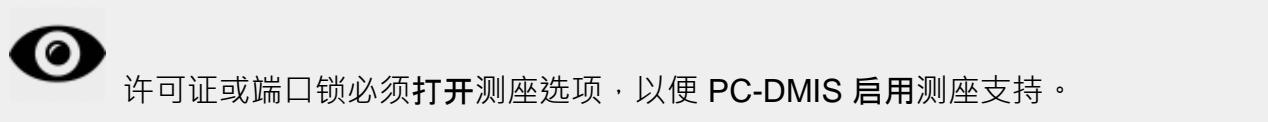
使用此选项校准 SP600 测头的低级矩阵。有关信息，请参见“SP600 低级矩阵说明”和“执行低级矩阵校准”。

标定检查

此选项可重新测量您在选定的测头文件中指定的测尖方向。它将与为这些测尖方向先前测量的数据进行比较。您可使用此比较来确定是否需要完整的校准。此为所选测头文件中的仅审计程序，且不更新测头偏置。

复原装置

此选项会在先前校准的选定测尖角上执行部分测座映射程序，确定在测座误差图中 $A = 0$ 和 $B = 0$ 的正确方向。如果 PC-DMIS 设置编辑器 **RenishawWrist** 注册表项值等于 1，则 PC-DMIS 将包括**复原装置**以供选择。有关修改注册表项的帮助，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“修改注册表项”主题。



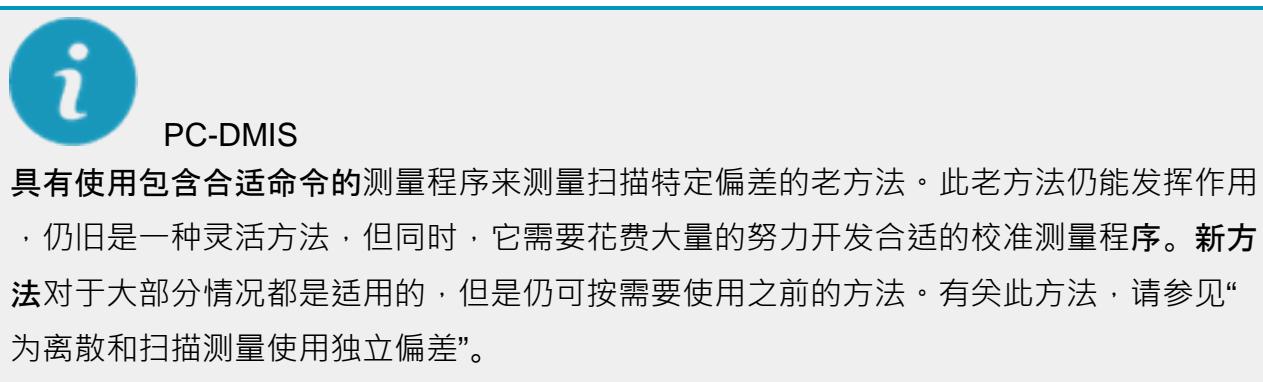
校准 NC-100 标准具

使用此选项校准 NC-100 校验工具。若要启用此选项，必须先前已购买 NC-100 选项。如果在端口锁上已启用此选项，**NC-100** 选项卡将显示在设置选项对话框（编辑 | 首选项 | 设置）中。然后，在**校准 NC-100 标准具**选项变为可用状态之前，您必须设置 NC-100。

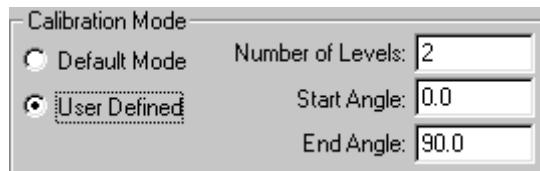
校验 ScanRDV

在使用模拟扫描测头时，某些测量机类型支持使用测尖标称大小的半径偏差。与连续扫描（称为 SCANRDV）相比，此标称值的偏差对于离散测点来说不同（称为 PRBRDV）。使用此选项在此对话框内直接校准测尖，计算扫描特定半径偏差。若您的测量机不支持独立于测尖大小的半径偏差，则此选项不可用。

使用此选项前，必须首先以常规方式校准测尖，一般是通过使用**校准测尖**选项。完成后，可使用**校准 ScanRDV** 选项计算扫描特定偏差。PC-DMIS 将测量校准工具平分线处的单个圆周扫描以计算值。



校验模式

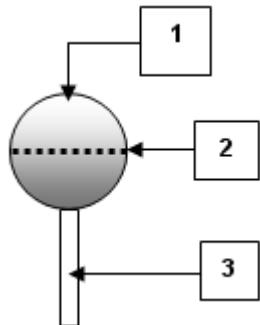


校验模式

校准模式区域包含您可在默认模式和用户定义选项之间切换的选项，如下所述。

默认模式

若选择**默认模式**选项，PC-DMIS 会在与赤道呈 10 或 15 度处的球形工具周围采取所指示数目的测点。它还采集垂直于测头（与赤道呈 90 度）的另外另一个测点。



样例球形工具

1 - 垂直于测头

2 - 垂直于测头

3 - 轴

若测杆直径和测针的直径差不多时，要在10或15度采触测点而要防止测杆触测到校验球。

如果测尖的直径 **小于 1 mm**, PC-DMIS 应在球体 15 度周围采点。

如果测尖的直径 **大于 1 mm**, PC-DMIS 应在球体 10 度周围采点。

用户定义模式

若选择此选项，PC-DMIS 可让您访问层级和角度框。PC-DMIS 会根据您所输入的层数、起始角和终止角测量测头。层的位置基于所设置的角度。0° 位于测头的平分线处。90° 垂直于测头。当垂直于测头进行测量时，将仅采集一个测点。

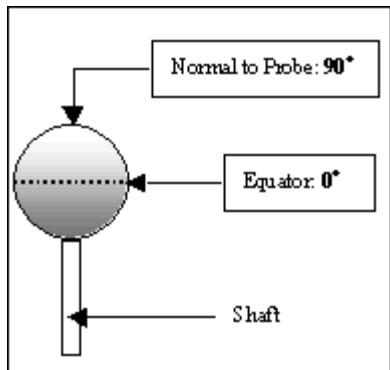
层数

此框设置 PC-DMIS 在校准过程中所用的层数。PC-DMIS 将根据层数来划分测点数，以确定在各层采集的测点数。

起始角和终止角

起始角和终止角框控制第一层和最后一层的位置。任何其他层将均匀置于这两层之间。

- 起始角 0° 位于球体的大圆上（相对于测头）。
- 终止角 90° 位于球体的顶部（垂直于测头）。



起始角和终止角

手腕校验区域

Wrist Calibration

	Start	End	Increment
A:	-140.0	140.0	10.0
B:	-180	180	10.0

Create New Map Replace Closest Map View / Delete Maps

手腕校验区域

使用测座校准区域可以多达九个球体测量的模式为可分度测座校准指定测座位置。当满足以下条件时，此区域变成可选择状态：

- 在测头工具对话框中设置无限可分度测座设备，例如 PHS 或 CW43L。请参见“定义测头”。
- 在 PC-DMIS 设置编辑器中将选项部分的适当测座项目（DEAWrist 或 RENISHAWWrist）设置为 1。请参见“修改注册表项”文档。
- 在测量测头对话框中的操作类型区域中选择校准装置选项。

有关使用以及检验测座设备时的深入信息，请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“使用测座设备”附录。

定义要校准的 AB 测座位置

为校准测座，对于总共九个球体测量，您需要以至少三个 A 角度位置以及至少三个 B 角度位置的模式来校准测座位置。测座校准区域使您能够指定校准 A 和 B 轴的角度。使用**起始**、**终止**和**增量**框为测座的映射指定起始和终止角，并为 A、B 轴上的映射指定增量。



假设您输入以下值：

A 角：

起始 = -90

结束 = 90

增量 = 90

B 角：

起始 = -180

结束 = 180

增量 = 180

PC-DMIS 将校准 A-90B-180、A-90B0、A-90B180、A0B-180、A0B0、A0B180、A90B-180、A90B0 和 A90B180 的位置。



应根据所使用的测座设备类型、机械可用性和制造商或供货商推荐选择实际的起始和终止角。在某些情况下，PC-DMIS 将基于控制器规格自动确定起始和终止角（尽管在这些情况下，PC-DMIS 将仅映射 359.9 度 B 轴辊）。

尽管校准测座设备需要最少九个位置，可选择使用九个以上的位置。若使用九个以上的位置，PC-DMIS 将使得校准结果稍微更准确。

当校准测座时，也可创建测座错误映射，以校正校准位置之间测座中的角度错误。有关信息，请参见 PC-DMIS 核心文档的“使用测座设备”附录中的“计算错误映射”。

若使用 SP600 测头，请确保阅读 PC-DMIS

核心文档中“使用测座设备”附录中的“测座校准”主题中的警戒子主题。

使用手腕误差映射

使用以下控件创建、取代、查看和删除测座错误映射。

- **创建新映射** - 单击测量时，此选项可创建新的测座错误映射。
- **替换最近的映射** -
当单击测量时，此选项以新建的测座错误映射替换最近的已有测座错误映射。
- **查看/删除映射** -
此按钮显示**查看/删除测座映射**对话框。此对话框列出系统上所有的测座误差映射；对于各映射，其还显示测头扩充长度，列出 AB 角度数和角度增量值。要从系统移除测座错误映射，选择某一测座错误映射，并单击**删除**。

柱测尖标定

Shank Qual

“柱测尖标定”复选框

若要使用柱测尖来采集棱边测点，请选择**柱测尖标定**复选框。使用此复选框可校验测头柱测尖。若选择此选项，您可操纵**柱测尖测点数框**和**柱测尖偏置框**。



请注意，若正在使用的是柱测尖测头，采集棱边测点时仅需进行一次柱测尖部校准。

柱测尖测点数

Number Shank Hits:

“柱测尖测点数”框

柱测尖数框设置用于测量柱测尖的测点数。

柱测尖偏置

Shank Offset:

“柱测尖偏置”框

柱测尖偏置框设置从柱测尖的距离（或长度）开始，PC-DMIS 将采集下一组校准测点。

参数集

Parameter Sets	
Name	<input type="button" value="Save"/>
<input type="button" value="Delete"/>	

参数集

使用**参数集区域**创建、保存和使用已保存的测头校准参数集。PC-DMIS 将此信息作为测点文件的一部分进行保存。它包括对测点数、逼近/回退距离、移动速度、触测速度、系统模式、校验模式和校验工具的名称和位置的设置。

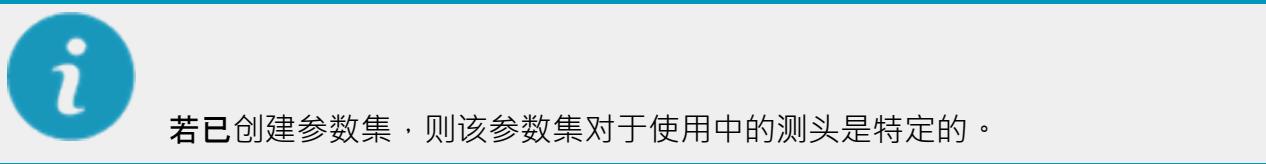
创建自己命名的参数集：

1. 让 PC-DMIS 自动将测头文件更新为至少 3.5 版本格式。
2. 访问测头工具对话框(**插入|硬件定义|测头**)。
3. 单击测量按钮。屏幕上将显示测量测头对话框。
4. 修改测量测头对话框中的参数。
5. 在**参数集区域**中，在**名称**框中键入新参数集的名称。
6. 单击**保存**。PC-DMIS

会显示一条消息，通知您新的参数集已创建。要删除保存的参数集，则选择该参数集并单击**删除**。

7. 若需立即校准测尖，请单击测量按钮。如果要稍后校准，则单击**取消**。
8. 在测头工具对话框中，单击**确定**。要删除对测头文件所作的任何更改（包括任何参数集），则单击**取消**。

一旦创建新的参数集，您可将其用于 [AUTOCALIBRATE / PROBE](#) 命令中（请参见 PC-DMIS 核心文档中的“自动校准测头”）。



若已创建参数集，则该参数集对于使用中的测头是特定的。

工具固定在转台上

[Tool Mounted on Rotary Table](#)

“**工具固定在转台上**”复选框

如果测头标定工具固定在转台上，请选择

工具固定在转台上复选框。如果测量机没有配备转台，请禁用此复选框。

开始校验前重置测尖理论值

[Reset tips to Theo at start of calibration](#)

“**启动校准时重置测尖为理论值**”复选框

若选择此复选框，在校准启动时，所校准的测尖将自动重置为其原始理论条件。这其实与校准前手动单击测头工具对话框中的**重置测尖**按钮的作用相同。

但是，此功能并不适用于所有类型的操作和所有类型的硬件。



它并不影响“校验检查”操作，因为这只是校准测试而已，并不实际更改任何校准数据。在映射模式下使用无极臂测座装置时，此功能也不适用。

其主要用途在于，当在索引（非映射）模式下使用固定测头、可分度测座或无极臂测座时，与“校准测尖”操作结合使用。

没有选择任何测尖时默认选择



“未明确选定测尖时所要使用的测尖”区域

若在开始校准前，您未在测头工具对话框中的**活动测尖列表**明确选择任何测尖，则使用此区域可指定 PC-DMIS 应采取的操作。



若在测头工具对话框中进行了明确选择，则仅使用选定测尖。

- **全部** - PC-DMIS 使用当前测头文件中的所有现有测尖角度。
- **程序中使用** - PC-DMIS

仅对当前测头文件使用当前测量程序中使用的测尖角度。限制如下：

- 如果在测量程序中使用此选项且启用了**自动调整测头头部测座**选项，则此选项可能不会达到所需的结果。校准时测量程序中所用的测尖可能会因实际零件坐标系发生更改。
- 此选项仅考虑当前打开的测量程序。不会考虑子程序等外部文件参考。
- **中止执行 - PC-DMIS** 中止执行或测量。PC-DMIS 将未选择测尖角度条件视为错误条件。

这些选项不能应用于所有操作类型和所有硬件类型。其主要用途在于，当在索引（非映射）模式下使用固定测头、可分度测座或无极臂测座时，与“**校准测尖**”或“**校验检查**”操作结合使用。

测量



“**测量**”按钮

测量按钮执行**操作类型区域**中选择的操作。

SP600校验信息

在3.25和更高的版本使用更改sp600测头校验程序。

SP600 下矩阵注释

下矩阵程序使用 Hexagon Manufacturing Intelligence 开发的 AP_COMP 方法。这些设置位于 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中的 **ANALOG_PROBING** 标题下：

- **SP6MTXMaxForce** - 将其值设为 0.54.
- **SP6MTXUpperForce** - 将其值设为 0.3。
- **SP6MTXLowerForce** - 将其值设为 0.18。

这些设置的值是由 Hexagon Manufacturing Intelligence

当前在下矩阵程序期间推荐的值。当第一次运行下矩阵程序时，将创建这些项目（若其尚不存在）。

除非 Hexagon Manufacturing Intelligence

发布新的推荐值，否则不应更改这些值。不管当前测量例程中可能或可能不存在的 OPTIONPROBE 命令，下矩阵程序将使用这些设置值。

有关 PC-DMIS 设置编辑器的信息，请参阅“PC-DMIS 设置编辑器”文件。

有关下矩阵的更多信息，请参阅此支持页面：

<http://support.hexagonmetrology.us/link/portal/16101/16131/Article/721/What-is-a-Lower-Level-Matrix>

SP600 高级矩阵（常规校准）注释

使用模拟类型测头时，下列的注释适用于高级矩阵校验。

对同类型测头使用测头选项命令

只要您更改参数设置对话框中的**可选测头**选项卡上的值，OPTIONPROBE

命令就会插入到测量程序中。有关参数设置对话框的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档的“设置首选项”一章中的“参数设置：测头选项选项卡”。

若 PC-DMIS 碰到测头的 LOADPROBE 命令之前，先碰到当前测量程序中的 OPTIONPROBE 命令，则校准将使用 OPTIONPROBE 命令中的值。若 OPTIONPROBE 命令不在 LOADPROBE 命令之前出现，则 PC-DMIS 将使用存储在 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中的默认值。

对于 3.25 版本，应包括 OPTIONPROBE 命令，以确保校准程序使用正确的值。3.25 版本要是没有 OPTIONPROBE

命令就不能自动使用机器指定的默认值，即使对特殊的机器使用了默认的参数，但仍然要在 OPTIONPROBE 命令中指定值。

对于 3.5 以上的版本，不必包括 [OPTIONPROBE](#) 命令中的默认机器值，因为若 PC-DMIS 找不到 [OPTIONPROBE](#) 命令，其将自动使用机器特定的默认值。默认参数存储在 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中的 ANALOG_PROBING 部分。



使用 [OPTIONPROBE](#) 命令可能会限制测量例程的便携性。由于 PC-DMIS 使用 [OPTIONPROBE](#) 命令中机器特定的数据，因此若在一台使用不同 CMM 的计算机上运行测量例程，则可能会得到不准确的结果。除非您真正需要使用 [OPTIONPROBE](#) 命令（即测量一个真正软的零件），通常不应在此版本中使用 [OPTIONPROBE](#) 命令。PC-DMIS 会自动从 PC-DMIS 设置编辑器应用程序中获得默认机器值。

更改默认校验的运算法则

关于 SP600 更改成 Trax 的默认 3D 校验运算法则。您可以查找注册设置，以在 [选项](#) 和 [使用 SP600 的 Trax 登录](#) 的标题之下控制。

默认情况下，PC-DMIS 将此条目设置为 1，意味着 Trax 为默认算法。当然也可尝试最适合具体情形的算法。

若将 Trax 校准用于 SP600，则从校准产生的有效测尖大小将不同于设计值。

在 Wetzlar 机器上，若将 Trax 校准用于非 SP600 模拟测头，则将使用测尖大小的设计值，因为测尖大小偏差经过不同的处理。

若使用非 Trax 校准，则使用测尖大小的设计值。

有关 PC-DMIS 设置编辑器应用程序的信息，请参阅“PC-DMIS 设置编辑器”文件。

采集额外的样例点

PC-DMIS 设置编辑器中不再存在 [UseAnalogSampling](#) 条目。相反，您可将以下注册表项用于样例测点。

- [UseAnalogSamplingLatitudeStart](#)

- `UseAnalogSamplingNumHits`
- `UseAnalogSamplingNumLevels`

对于所有这些条目，默认值为无 (-1)。有关这些条目的更多信息，请参见“PC-DMIS 设置编辑器”文档。

盘测针的校验注释和程序

当使用校准球体在模拟测头上执行盘式测尖的离散测点校准时，您需要在测量测头对话框中的测点数框中指定五个测点，在层数框中指定两层。这些设置不应用于使用基于 Renishaw 扫描的校准的测头。

请确保在定义测头时，模拟盘式测尖而非球式测尖。单击测量测头对话框中的测量按钮后，PC-DMIS 会自动识别您的模拟测头为盘式测尖，并继续此步骤：

- 移动校验球，或者选择 **Man + DCC** 模式后，PC-DMIS 将会提示你用盘形测头底部中心在校验球最高点上进行一次手动触测（北极点）。如果测头配置中有其他球形测头附着在盘形测头底部，则确保用该球形测头采点。
- 如果没有移动校验球，也没有选择使用 **Man + DCC** 模式，PC-DMIS 将会在 DCC 模式下在标准工具的最高点上采点。

PC-DMIS根据在DCC模式中完成的操作：

- PC-DMIS 将会根据 `ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom` 注册表项值（位于 PC-DMIS 设置编辑器测头校准一节）进行以下操作：
 - 如果这个条目设置成1，PC-DMIS用圆弧移动方式在球体的顶部测量四个点然后在盘形测针的底部计算平面。测量一个平面用来帮助确定校验的测点面对或校验方式的正确性。该默认值适用于传统校验方法使用点触发。

- 如果该条目设置成0, PC-DMIS将不会测量盘形的底面。相应地使用盘形设计定位。这是雷尼绍扫描测头的默认校准方式。
- 采完这个点之后在球体顶部采六个点两层来得到一个准确的球体的中心点。
- 它使用中心点以及沿着矢量在平面测量或者设计的方向来调整后续的测量位置的正确性。
- 对于离散的触测校准需要测量5点：四点在赤道位置确定一个圆，第5点在顶部，或者球体的极点。
- 对于扫描校准需要测量一系列的扫描点在两层上，一条扫描线在赤道上，另一条略高于赤道。每个高度的扫描线都需要顺时针和逆时针两种方向。每个方向对于每层在扫描时同样需要两个不同的扫描力偏置。这个结果是八个扫描的总和。

PC-DMIS 还在测头校准部分的 PC-DMIS

设置编辑器中提供其他两个注册表项。您可使用这些项目在校准过程中影响盘式测尖底部的测点位置。这些条目为：

- `ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge`
- `ProbeQualAnalogDiskPlaneStartAngle`

有关这些条目的更多信息，请参见“PC-DMIS 设置编辑器”文档。

SP600的校验过程

根据此过程描述如何校验sp600测头的低级矩阵补偿。

为在以下流程中获得最佳准确性，请使用高质量球形校准工具，并在两个校准流程中保持校准工具清洁。

执行低标准矩阵校验

低级矩阵包括测头设备的三维或者中心位置。

在以下这些情况你应该对SP600重新做低级矩阵校验：

- 移动了测座
- 重新安装了测座
- 连接了一个新的SP600测头
- SP600遭受了损坏
- 基于特定需求，周期间隔期间

前提条件

在执行下面的校准过程之前，请确保您已经具备了这些前提条件：

- PC-DMIS已经以在线模式运行。
- 必须使用拥有较低矩阵的CMM的情况下运行PC-DMIS。
- 如果使用 Hexagon Manufacturing Intelligence / DEA的 Leitz 协议控制器，必须配置为使用下矩阵。必须在控制器设置中将PRBCONF=0，才可以确保这一点。
- 您必须有一个可以利用较低矩阵的模拟测头。包括SP600, SP80, LSP-X1, LSP-X3, LSP-X等等。
- 在这个过程中，您必须使用刚性测针保证尽可能少的偏转。例如对于SP600，是ceramic stylus。

校验过程

1. 访问测头工具对话框(**插入|硬件定义|测头**)。
2. 请确保**活动测尖列表**中存在您所需的角度。
3. 从**活动测尖列表**中选择用作参考位置的角度。大多数情况下，此应为用于Z-方向的角度。除非为水平臂，否则此角度通常为T1A0B0测尖。

4. 单击测量按钮。测量测头对话框出现。

5. 从操作类型区域选择 **SP600**

下矩阵选项按扭。只有在联机模式下工作并且测头工具对话框内有 SP600

测头设置时，才会出现此选项。

6. 如果需要可以更改逼近/回退、移动速度或触测速度框中的值。

7. 从可用工具列表中选择合适的工具。

8. 单击测量按钮。PC-DMIS

将显示一条警告消息，指示若继续，则您将更改控制器自身上的较低层数组的机器
特定参数。单击**是**继续校准。

9. PC-DMIS 将显示另一条消息，询问是否已移动校验工具。单击**是或否**。

10. PC-

DMIS会显示另一条信息要求你垂直于校验工具采一个点。如果你工作在Z负方向
，在工具的最上方采点。在采完这个点后，PC-

DMIS会自动完成确定校验工具中心位置的操作。它是通过采以下几点来完成的：

- 围绕球体采集 3 个测点
- 围绕球体采集 25 个其他测点

11. 一旦PC-DMIS找到工具的中心位置，实际的低级矩阵校验就开始了。PC-

DMIS会经过校验工具的X正、X负、Y正、Y负和Z正极点自动的采20个点（在一个
方向上采10个点，在另一个方向采10个点，这两个方向成十字），共记100个点。
这个步骤要花费5到10分钟去完成

12. PC-

DMIS然后会为用户展示9个数字，并询问这些号码是否正确。这些是较低矩阵值
。如果用户从Z方向校准测头，那么ZZ（第三行第三列的值）值应该位于14到16
之间。其他值都应该小于或接近.1。

13. 如果值是正确的，点击正确**。PC-**

DMIS会向测量机发出紧急制停命令并且用这些新值重写控制器里的低级矩阵值。

PC-DMIS显示另一个信息框要求你给机器加电。

14. 在示教盒上按启动测量机**按钮。**

15. 单击消息框中的确定**。**

PC-DMIS

会再次显示测头工具对话框。注意在**活动测针列表**中的参考测针不会被校准。低级校准不会校准实际的测针角度。执行高级矩阵校准程序后，才会校准测针角度。



若不具备良好的低级矩阵，则在某些扫描例程中将出现问题，且机器可能不能完成某些扫描点。另外，您将遇到准确性问题。

执行高标准矩阵校验

在你完成了低级矩阵校验后，可以执行常规的校验程序。这个高级校验将校验实际的测尖。它会把矩阵中的其它数字发送到控制器，这些值是根据当前的测头配置和方位对低级矩阵做出的轻微修正。

为达成更高的准确性，PC-DMIS

应采集测头测点，围绕校准球体的赤道测量完整的扫描。若球体上覆盖角度良好，则您将获得较佳的结果。从 PC-DMIS 设置编辑器的 **ProbeCal** 部分中的这些设置，可控制围绕球体赤道扫描的起始和终止角度。

FullSphereAngleCheck - 将其值设为 25.0

ProbeQualToolDiameterCutoff - 将其值设为 18.0

ProbeQualLargeToolStartAngle1 - 将其值设为 50.0

ProbeQualLargeToolEndAngle1 - 将其值设为 310.0

ProbeQualSmallToolStartAngle1 - 将其值设为 70.0

ProbeQualSmallToolEndAngle1 - 将其值设为 290.0

有关修改注册表项的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“修改注册表项”主题。

校验过程

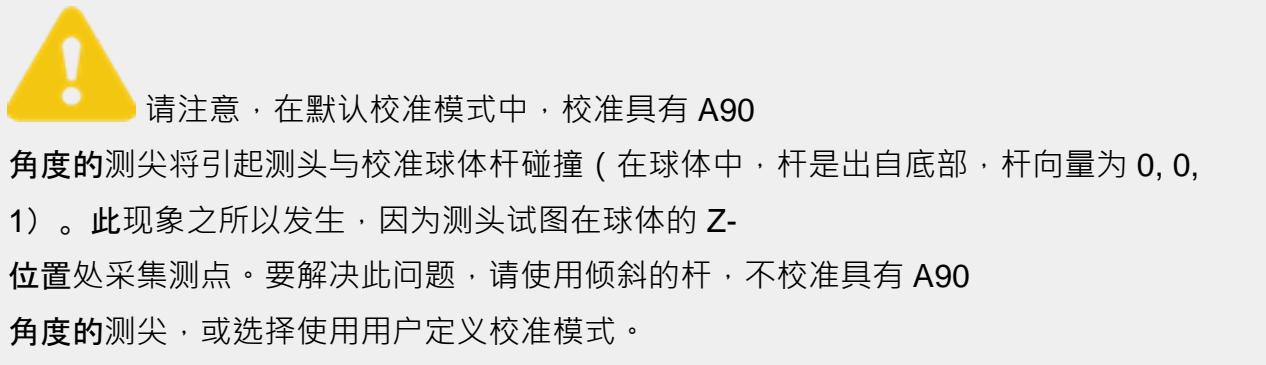
遵循这个步骤来做高级矩阵校验：

1. 打开测头工具对话框（**插入 | 硬件定义 | 测头**）。
2. 单击测量按钮。
3. 选择**操作类型**区域中的**校准测尖**。
4. 选择**校准模式**区域中的**用户定义**。由于默认方法仅在直径周围采集测点，并在校准球体顶端采集一个测点，因此此方法不能提供非常良好的测头中心 3D 关系。但是，若需使用默认方法进行校准，请确保阅读以下“SP600 默认 (2D) 校准模式注释”。
5. 在层数中键入
3。可键入更多层数，只要不超过即将进行的采点数即可。但层数的最低值为三层。
。
6. 在起始角度方框中键入 **0**。
7. 在终止角度方框中键入 **90**。
8. 在测点数框中键入 **25**。PC-DMIS 最少要采 12 个点，通常建议采 25 个点。
9. 准备好开始后单击测量按钮。
10. 若已在 PC-DMIS 设置编辑器中打开模拟触测点选项，则 PC-DMIS 将自动在校准球体周围采集 5 个测点，以更佳定义校准工具的中心。
11. 然后 PC-DMIS 校验 AB 角度位置并自动的把高级矩阵的数字写入到控制器里。如果你已经正确的执行了低级矩阵校验程序，自动的这些数也都是正确的。

PC-DMIS 随后显示测头工具对话框。现将校准活动测尖，并已可使用经新校准的 SP600 测头对测量程序进行编程。

SP600默认（2维）校验模式中注意事项

若在**校准模式**区域中选择**默认**，则 PC-DMIS 将在测点数框中插入五个测点。当开始校准程序时，PC-DMIS 将在垂直于测头位置的轴上采集这些测点。



请注意，在默认校准模式中，校准具有 A90 角度的测尖将引起测头与校准球体杆碰撞（在球体中，杆是出自底部，杆向量为 0, 0, 1）。此现象之所以发生，因为测头试图在球体的 Z- 位置处采集测点。要解决此问题，请使用倾斜的杆，不校准具有 A90 角度的测尖，或选择使用用户定义校准模式。

使用温度传感器

PC-DMIS 支持使用安装于 CMM

测头上可更换的温度传感器或温度传感器应用温度补偿的功能。有关温度补偿的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“温度补偿”主题。

PC-DMIS 支持持续接触与非持续接触温度传感器。

持续接触温度传感器

此类传感器连续与零件进行接触。温度补偿命令 ([TempComp](#)) 读取温度。有关 TempComp 命令的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用带多臂校准的温度补偿”主题。

非持续接触温度传感器

以下非持续温度传感器可用：

- **固定式** – 此类传感器直接安装在 LSPX5.2、LSP-S2 或类似测头头部上。
- **可更换式** –
此类传感器为包含温度传感器的针组件，是可更换测头组件的一部分。您可以将传感器放在工具架中。您可以以一般方式将其作为针组件进行固定或拆卸。有些测头（例如，LSP-X5.3 和 LSP-S8）支持可更换的温度传感器。

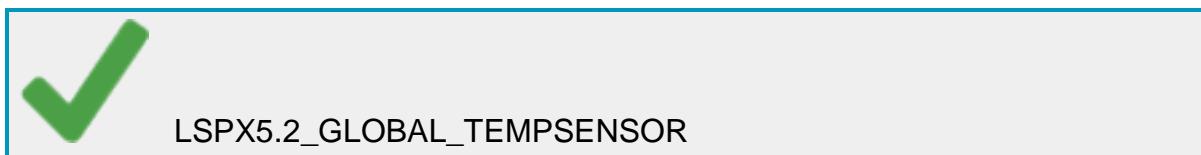
温度触测即自动测量零件温度的一项功能，需要使用非连续接触温度传感器测量温度。您必须通过测量温度触测点来测量温度。测量温度后，您可使用 [TempComp](#) 命令来启动温度补偿。

创建一个温度测头文件

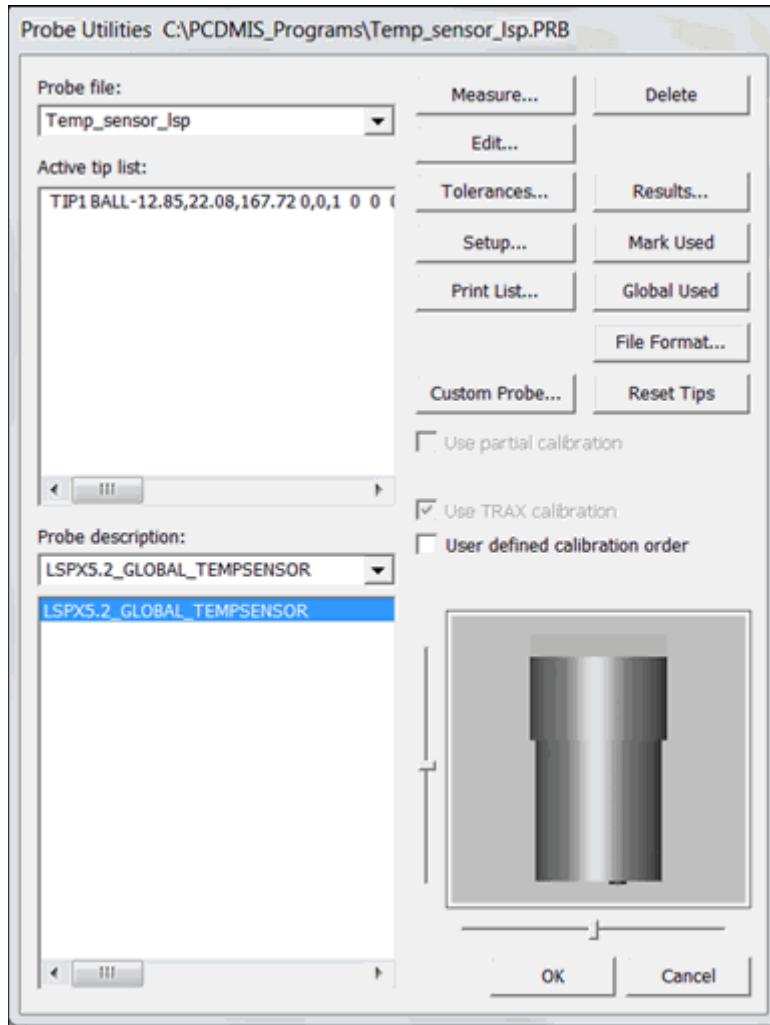
要创建温度测头文件：

1. 打开 PC-DMIS 测头工具对话框（**插入 | 硬件定义 | 测头**）。
2. 创建温度测头

安装在测头上的温度传感器的测头说明区域中的主测身说明以“TEMPSENSOR”结尾。



下图显示了CMM测头尖上安装的温度传感器的示例。



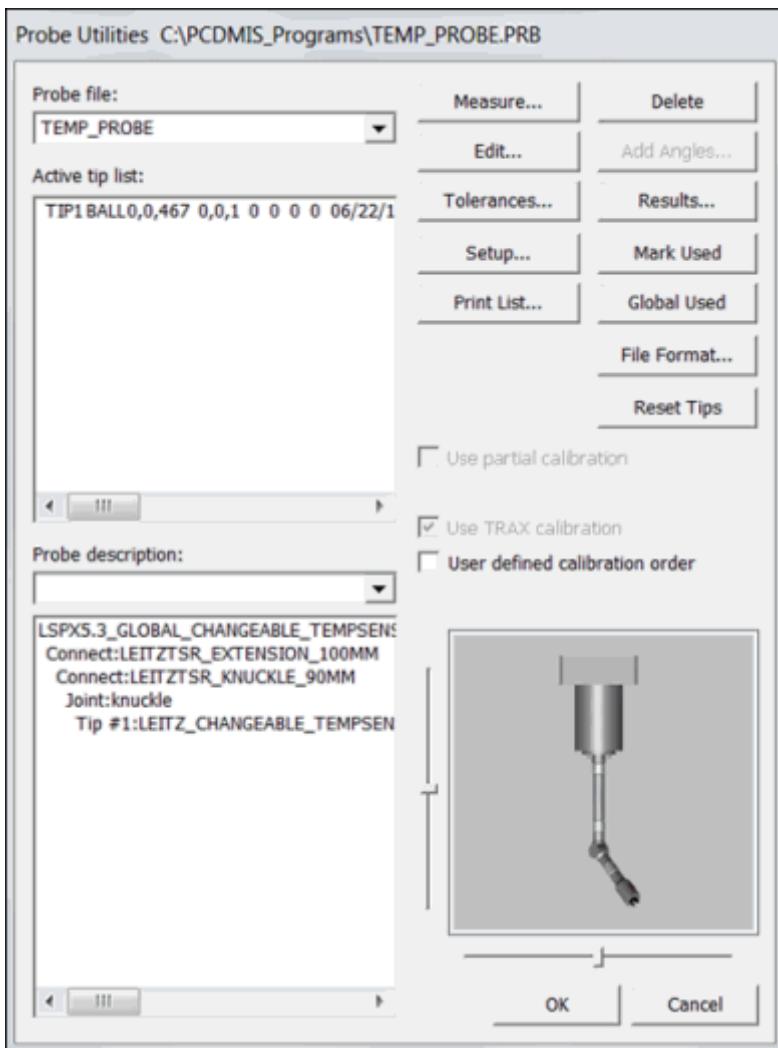
CMM 测头尖上安装的温度传感器

测头工具对话框示例

可更换温度传感器的测头说明区域中的主测身说明以
CHANGEABLE_TEMPSENSOR 结尾。



下图显示了带有可变的温度传感器的示例。



可变温度传感器的测头工具对话框示例

有关此对话框中各选项的信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“了解测头工具对话框”主题。

编辑温度测头组件

您无需校验温度测头。但若您正在使用一个可变温度传感器，则需确保温度测头的理论矢量是正确的。



若您正在使用一个转向节部件，可通过改变连接部分的旋转角度来调整理论矢量。

要编辑温度测头组件：

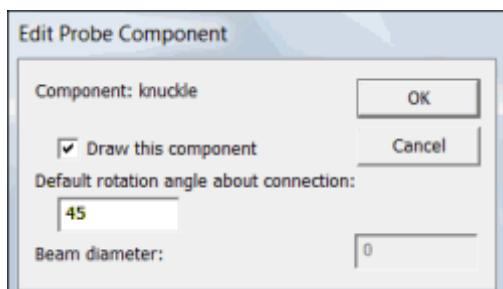
1. 双击 PC-DMIS

测头工具对话框中测头说明区域的组件。要访问该对话框，从菜单栏里选择**插入 | 硬件定义 | 测头**。有关帮助，参考 PC-DMIS 核心文档中的“了解测头工具对话框”主题。

屏幕上会出现编辑测头组件对话框。

2. 在有关连接的默认旋转角度框里输入需要的角度（+180度到-180度间的任何角度）并点击**OK**。

下图显示转向节的示例。



编辑测头组件对话框的示例

测量温度探测点

温度测头的工作机制与正常的测头类似。当传感器接触到零件时开始测量。

温度探测点可以是：

- 测量的一个点
- 矢量点

您必须沿温度测头传感器的矢量方向测量温度触测点。当选择某一温度传感器作为测头测尖并测量点时，PC-DMIS 会沿使用中的温度测头的矢量方向驱动

CMM，同时忽略测量点或矢量点的理论矢量。此操作可确保测量值正确无误，温度传感器接触到零件的正确部位。

温度测量方法

PC-DMIS 支持以下温度测量方法；但是，这一功能取决于正在使用的特定 CMM 的功能。一些 CMM 仅支持一种测量方法。例如，带 B4 Leitz 控制器的 CMM 仅支持两种测量方法。

在与接触零件有一定间隔（接触时间）后才测量温度：

用这种方法，能保持传感器与组件接触设定的时长。持续测量温度以确定零件的温度。大部分支持此种模式的CMM均有一个默认接触时间，通常作为延迟时间。

要测量 CMM

接触时长的温度，而不是默认时长，您需在点实施测量前通过在您 PC-DMIS 测量例程某处插入一个相应的“赋值”来确定所需的接触时间。该赋值变量的名称为：

温度传感器_接触_时间_秒

赋值示例为：

赋值/温度传感器_接触_时间_秒=30

接触时间的选择取决于温度传感器的灵敏性。若时间太短，零件温度的读取可能出错。

不必在测量例程中给出“赋值”语句。只有当不使用 CMM 默认值时，才需要进行此操作。

用外推法来测量的温度：

用这种方法，只能保持传感器与组件接触非常短的时间，且组件温度是由一些被测值而推断出的。若您使用规定接触时间为0的“赋值”语句，则PC-DMIS在CMM支持的情况下试图使用外推法。这种情况下，控制器控制测量温度的时间。

赋值接触时间为0 的语句为：

赋值 / 温度传感器_接触_时间_秒 = 0

要启用外推法，将接触时间指定为

0。要禁用外推法并使用指定的时间间隔，将接触时间指定为大于 0 的值。

在大零件上测量温度

您可能想在不同位置测量大零件的温度。这种情况下，温度补偿基于温度读数的平均值。为此，您应测量多个温度点。PC-DMIS记录平均温度。

多次测量温度

当您多次测量温度，PC-

DMIS记录每次的温度，并根据温度补偿命令使用平均温度。当执行温度补偿命令时，则重置读数之和以启动随后温度读数的新平均值。此外，记录平均温度。读数之和在更换测头时也将重置。

若您想再次测量温度，则需执行[温度补偿命令](#)来在再次测量之前“重置”记录的温度。

使用带有工具架的温度测头

安装在测头上的温度传感器不需要测头再被赋值到工具架内的修理库/槽。

可变温度传感器需要测头被赋值到工具架内的修理库/槽以使其能够自动加载或卸载。

为离散和扫描测量使用独立偏差



还可使用“操作类型区域”中讨论的更新更简单的校准 ScanRDV 方法。

校准基于接触的模拟扫描测头时，测定的测尖大小可能因标称测尖大小而异。这取决于测量机的类型以及选定的校准方法的类型。在某些类型的测量机上，可能会计算此偏差并作为独立于标称大小的径向偏差传送给测量机控制器。在这些测量机上，此偏差对校准数据的采集方法十分敏感，尤其是就是使用离散测点还是扫描而言。有时，这会导致在校准后测量过程中出现明显的大小差异。这取决于指定特征是否使用离散测点或扫描测量。

要解决该差异，某些测量机控制器（即当前使用 Leitz 接口的测量机）已进行了增强，以支持使用离散测点测量 (PRBRDV) 和扫描测量 (SCNRDV) 的独立偏差。要支持此功能，您可在 PC-DMIS 中使用如下程序，在完成常规校准后更新 SCNRDV。

程序概览：要执行此操作，扫描一个已知尺寸的校准检具。通常您要围绕校准球大圆或环规内部扫描一个或多个圆。从这些扫描构造一个圆特征，然后使用“活动测尖列表”命令更新测尖的校准数据。

校验过程

1. 执行传统的测尖校准。此操作将计算常见参数，如测尖偏置和偏转系数，并将 PRBRDV 与 SCNRDV 设为得出的偏差。您可使用预备的独立校准测量例程，或在步骤 2 中使用的同一个测量例程的前面部分，或是交互地在某个位置（通过访问测头工具对话框并使用测量按钮）执行测尖校准。请参见“校准测尖”。
2. 创建测量例程的操作如下：

- 测量一个已知尺寸的校准制品的一次或多次扫描。这通常是一个普通的基本圆扫描，会测量校准球的赤道或环规内的内测。该制品不必定义为PC-DMIS内部的校准工具。见“执行圆基本扫描”。
- 引用所需扫描的最佳拟合重新补偿 (BF Recomp) 的构造圆特征。请参见 PC-DMIS 核心文档中的“构造圆特征”主题。SCNRDV
计算当前不支持其他构造圆类型或非圆特征。



构建特征的理论尺寸必须与校准制品正确匹配。另外，您必须在构建的圆的输入参数中为测量的制品指明理论半径。构建圆的理论和测量尺寸的差异将会是建立SCNRDV值的基础。

- 参考构建的圆的“校准活动测头”命令。见PC-DMIS核心文档中的“自动校准单个测尖”。当您将这个类型的圆作为输入特征使用该命令时，校准单个测尖命令不需要参考校准球。

3. 执行上一步中所述的测量程序。此操作将根据构造圆的理论大小与测量大小的差异更新 SCNRDV，同时测尖偏置和 PRBRDV 保持不变。



在执行扫描进行校准时，测量例程中必须存在最佳拟合重新补偿圆和步骤 2 中描述的“校准单测尖”命令，这是因为二者影响扫描在测量机上的执行方式。

校准测量例程示例的一部分

```
SCN_FORCAL =BASICSCAN/CIRCLE,NUMBER OF HITS=54,SHOW  
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=NO
```

终止扫描

```
CIR_PRECAL=FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR,YES  
THEO/<0,0,5>,<1,0,0>,50
```

```
ACTL/<-0.0007,-0.0007,-0.0001>,<0,0,1>,49.9967  
CONSTR/CIRCLE,BFRE,SCN_FORCAL,,  
删除超差点/关, 3  
FILTER/OFF,UPR=0  
CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=CIR_PRECAL
```

在上述例子中，在一个50mm的环规内测执行了一个单独的圆扫描，构建出的圆特征从中创建，然后使用了校准活动测尖命令更新了该活动测尖的SCNRDV值。如果被执行的特定测量合适，构建的圆将会有不止一次的扫描作为输入。

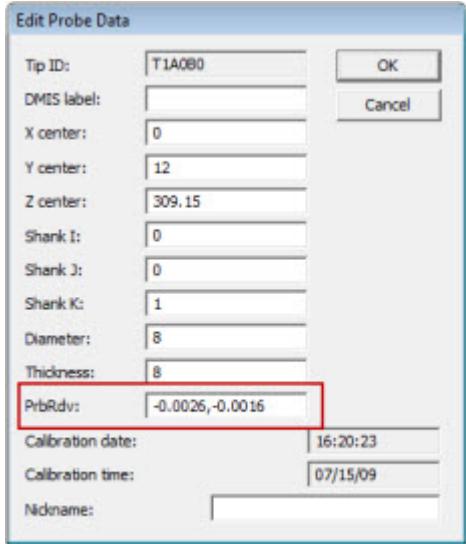


在一些情况下，可以通过包含一次顺时针扫描和一次逆时针扫描获得更好的平均值。

手工编辑SCNRDV

要查看或手动编辑

SCNRDV，可在测头工具对话框中选择所需的测尖，并单击编辑按钮。屏幕上将显示编辑测头数据对话框，其中 **PrbRdv** 框包含有以逗点分隔的 PRBRDV 和 SCNRDV 的值，比如：



Renishaw SP25扫描测头

以上程序主要针对最初采用离散测点校准的传统仿真扫描测头。由于使用离散测点校准测头，使用离散测点进行的后续测量通常可获得良好结果。但是，有时需进一步进行调整，以获得更加适用于基于扫描的测量的 SCNRDV。

对于 Renishaw SP25

扫描测头而言，情况于此相反，因为初始（完整）校准是采用一系列扫描执行的。有时这样的校准结果就是，尽管扫描测量是可以，但在使用离散测点测量时可能存在大小差异。

为了定位这个问题，可以对SP25的“部分”校准步骤做一些修改。该部分使用离散触测并更新测尖的位移和尺寸，而不会修改基于完全扫描的校准产生的倾斜系数。在这个修改中，当更新尺寸的结果时，部分校准步骤现在会更新PRBRDV，而不会修改SCNRDV值。

若执行完整校准后进行部分校准，所得到的 PRBRDV 将来自于离散测点的部分校准。而 SCNRDV 仍将来自于完整扫描校准。

尽管看起来一开始的对SP25的基于扫描的校准有些没有必要；如果必要，新的SCNRDV步骤可以用于SP 25，就像用于其他模拟扫描测头。

使用不同的测头选件

假定已加载测头，且已校准要使用的测尖。

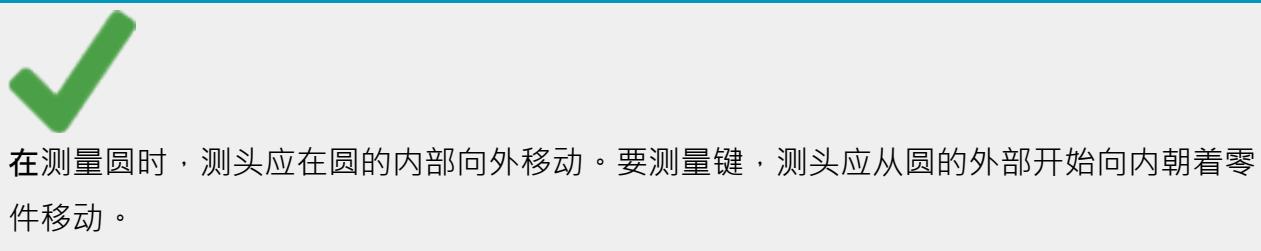
联机使用测头

要在联机模式下使用 TTP 测量点，请执行以下步骤：

1. 将测头降到要采点的曲面上。
2. 使测头接触曲面以便触发测头。
3. 按 END 键完成测量过程。

PC-DMIS

的设计可以确定调整类型。测头补偿由测头半径决定。补偿方向由机器的方向决定。



若要使用固定测头测量点，您必须指定要测量的特征类型以及测头补偿方向。请参见 Portable 文档中的“使用硬测头”。

脱机使用测头

当在脱机模式下使用 PC-DMIS

时，您可访问所有测头选项。但不能执行实际测量。您可以输入测头数据，或使用默认设置。



在脱机模式下采点，需要：

1. 确保 PC-DMIS

处于程序模式。要执行此操作，选择图形模式工具栏上的**程序模式**按钮。（请参见 PC-DMIS 核心文档的“使用工具栏”一章中的“图形模式工具栏”主题。）

2. 将鼠标光标移动到将进行触测的屏幕。

3. 单击鼠标右键将测头测尖移动到将进行采点的零件区域。将在屏幕上绘制该测头并设置测头深度。

4. 单击鼠标左键，并在零件上注册测点。若已选择线框模式，则将在最近的联机采集测点。若处于曲面模式下，则在选择的曲面上采集测点。

5. 按 END 键完成测量过程。

使用测头工具箱

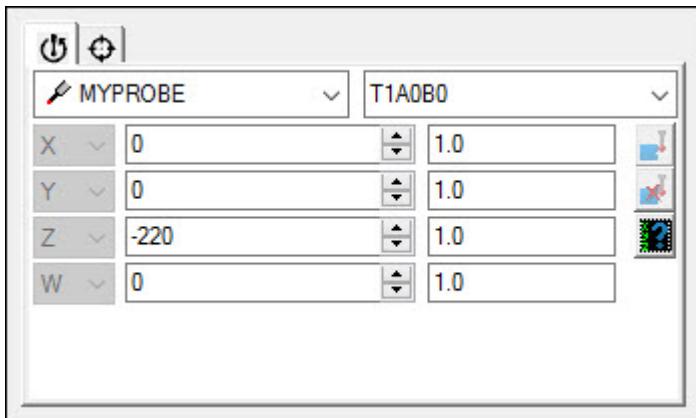
使用测头工具栏 介绍

在 PC-DMIS CMM

中，使用测头工具箱可执行接触测头特定的各种测头相关的操作。若要使用测头工具箱对话框本身，则该对话框仅包含两个选项卡。查看嵌入在**自动特征**对话框中的工具箱时，会显示其他几个选项卡。

使用“测头工具箱”对话框

1. 选择视图 | 其他窗口 | 测头工具箱。屏幕上出现测头工具箱对话框：



用于接触测头的测头工具箱

2. 完成所出现的两个选项卡上的属性：

- 定位测头选项卡 -

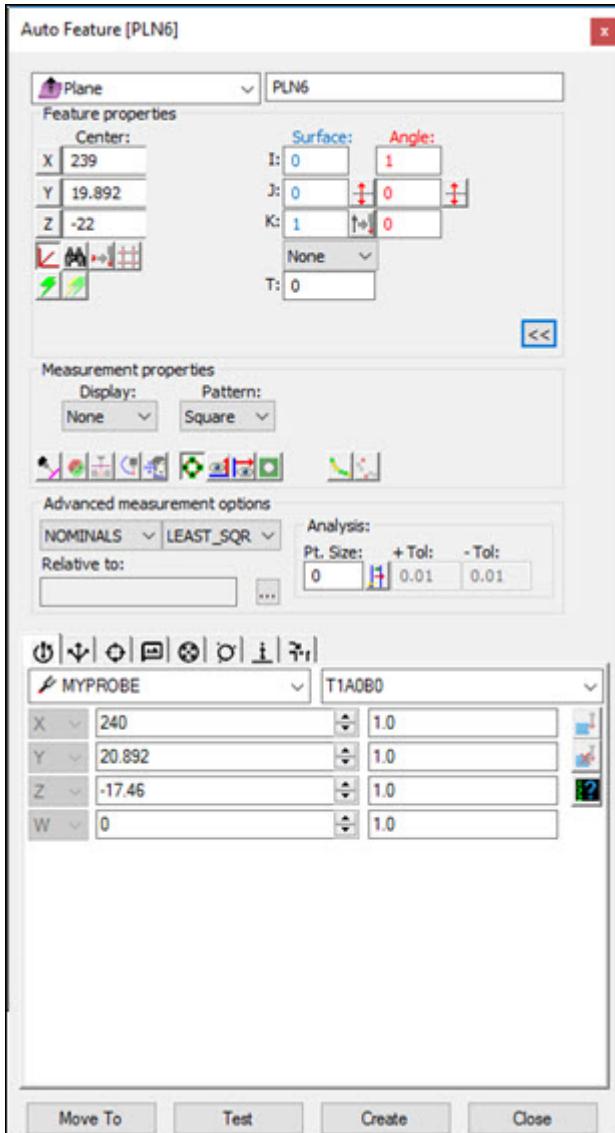
使用此选项卡可在已配置的现有测头与测头测尖之间进行切换，查看当前测头位置，访问“测头读数”窗口，以及从测点缓冲区中删除探测的测点。

- 触测目标选项卡 - 使用此选项卡可查看测量此特征以及每个测点的 XYZ 值所使用的测点。

使用嵌入“自动特征”对话框的测头工具箱

1. 显示**自动特征**对话框。有关帮助，请参见“**插入自动特征**”。
2. 为要使用的测量策略选择**自动特征**。
3. 单击**>>**

按钮。屏幕上将出现**测量属性区域**、**高级测量选项区域**以及**测头工具箱**（带对话框下方的其他选项卡）。例如：



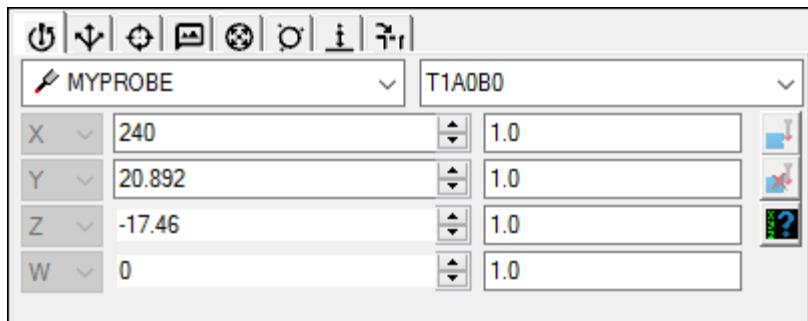
“自动特征”对话框示例



本文档集中未讨论测量属性区域和高级测量选项区域中的各选项。由于其中许多选项对于 PC-DMIS 的不同设置是通用的，PC-DMIS 核心文档包含此信息。如需这些区域中的选项的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“创建自动特征”一章。

测头工具箱显示在对话框的下方，显示 PC-DMIS

默认测量策略的选项卡。自动特征对话框中测头相关选项卡以及标准接触测头的操作包括其他选项卡。例如：



内嵌在自动特征对话框中的测头工具栏

4. 完成选项卡上的属性。

- **定位测头选项卡 -**

使用此选项卡可在已配置的现有测头与测头测尖之间进行切换，查看当前测头位置，访问“测头读数”窗口，以及从测点缓冲区中删除探测的测点。

- **测量策略选项卡 -**

使用此选项卡可加载特定类型自动特征的不同内部策略，更改特征的执行方式。

- **触测目标选项卡 -** 使用此选项卡可查看测量此特征以及每个测点的 XYZ 值所使用的测点。

- **特征定位器选项卡 -** 使用此选项卡可定义并查看特征位置说明。

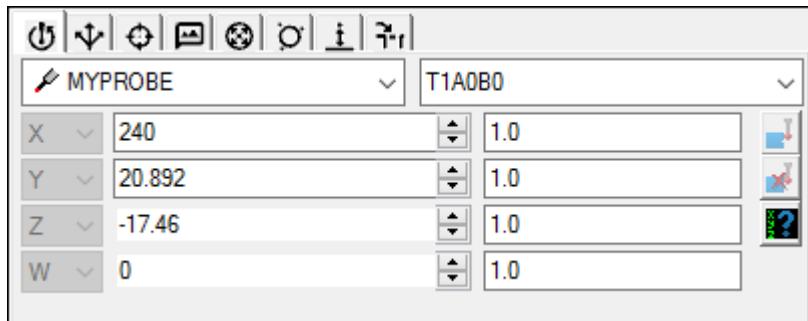
- **接触路径属性选项卡 -**

使用此选项卡可修改影响测头路径的属性，例如测点数、深度、每层的测点等。

- **接触样例测点属性选项卡 -** 使用此选项卡可修改样例测点属性。

-  **接触自动移动属性选项卡 -**
使用此选项卡可修改自动移动（或避让移动）的属性。
-  **接触查找孔属性选项卡 -** 使用此选项卡可修改查找孔的属性。

使用侧头位置



定位测头选项卡

在定位测头 (视图 | 其他窗口 |

测头工具箱) 中您可以在现有的已配置测头和测尖之间切换，查看当前测头的位置，访问测头读数窗口，并从触测缓存中删除测头触测。

更改当前测头

要使用测头工具箱 (视图 | 其他窗口 | 测头工具箱) 更改测量程序的当前测头：

1. 访问**定位测头**选项卡。
2. 选择测头列表：



“测头”列表

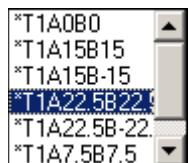
3. 选择新的测头角度

PC-DMIS 将已选择测头的 LOADPROBE 命令插入测量例程。

更改当前测头角度

要使用测头工具箱（视图 | 其他窗口 | 测头工具箱）更改测量程序的当前测头测尖，请执行以下操作：

1. 访问定位测头选项卡。
2. 选择测尖列表。



“测头测尖”列表

3. 选择新的测头角度

PC-DMIS 将已选择测头的 LOADPROBE 命令插入测量例程。

在测点缓冲区中查看最近的测点

查看上一触测

PC-DMIS 显示存储于测头位置选项卡上测点缓冲区内的最近测点或测头当前位置。在 PC-DMIS CMM 中，这些为只读值。



大多数当前点信息

一旦按下键盘上的 End 键或按示教盒上的“完成”按钮，将接受当前正在触测的特征。

将动态测头移至特定的位置

您也可更改 XYZ 和 IJK

值，以显示测点在“图形显示”窗口中的位置，并将测头移至此位置。在相应框中键入所需的值，或者单击向上和向下的小箭头，来增加轴向的值。PC-DMIS 在屏幕上将活动测头移至此位置。

采集和删除点

若要在当前测头位置采集测点，单击**采集测点图标**：



“采集测点”图标

PC-DMIS 向测点缓冲区中添加测点。仅使用已定义的硬测头，此图标方变为启用状态。

要使用测头工具箱删除测点缓冲区中的测点，单击**删除测点图标**：



删除点图标

若“测头读数”窗口打开，则应注意从窗口测点部分删除的测点。

访问测头读出窗口

若要通过测头工具箱访问“测头读数”窗口，请单击**测头读数图标**：



测头读出图标

有关“测头读数”窗口的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“使用测头读数窗口”。

设置测头为读出和采点模式

一些界面要求你在触点模式和读出器之间锁定因为这些模式必须每个专门操作。这是由于在接收状态（测点模式 — 等待测点信号）或者发送状态（读出模式 — 发送测头位置数据至“测头读出”窗口）下的界面操作不同。LK-RS232 界面是此类界面的一个示例。

若采用 LK 接口，可使用读数模式图标将测头置于读数模式：



读出窗口模式

若采用 LK 接口，可使用测点模式图标将测头置于测点模式：



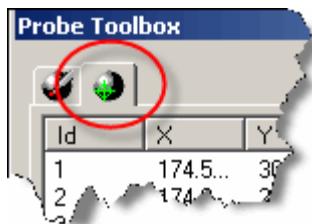
测点模式

查看触测目标

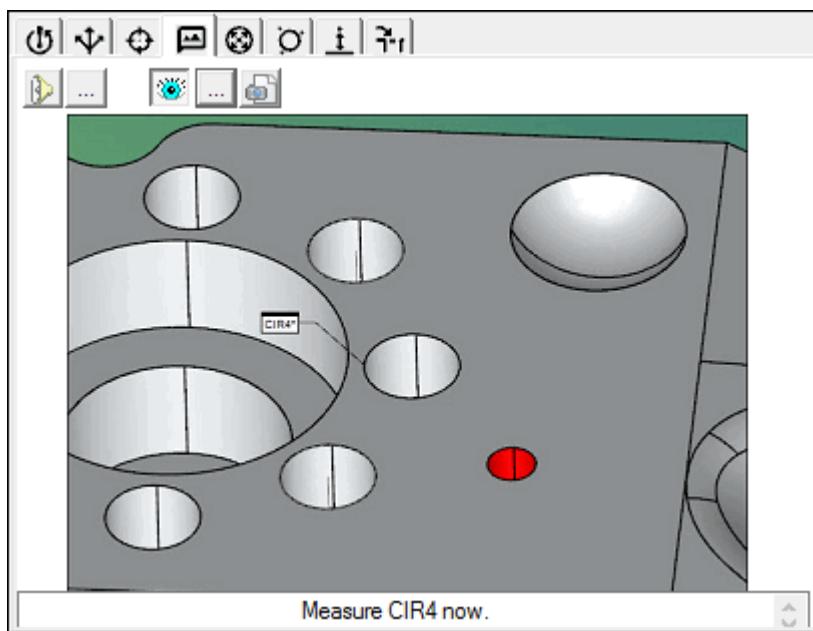
Id	X	Y	Z	I	J	K
1	174.9...	30.899	-2.000	-1.000	0.000	0.000
2	170.0...	37.624	-2.000	-0.309	-0.951	0.000
3	162.1...	35.055	-2.000	0.809	-0.588	0.000
4	162.1...	26.743	-2.000	0.809	0.588	0.000
5	170.0...	24.174	-2.000	-0.309	0.951	0.000

测头工具箱 - “测点目标”选项卡

点击选项卡查看缓冲器中所有的点。PC-DMIS 会为缓存中的每个触测显示 XYZ 和 IJK 数据。这个只读列表会随着新的触测被采纳，以及触测从缓存中被删除而动态改变。



提供和使用特征定位器指导



测头工具箱 - “特征定位器”选项卡

您可以使用**特征定位器**选项卡，为操作者提供测量当前自动特征的说明。若测量例程在自动特征测量中（例如操作者在手动模式下操作）需要一些操作者交互时，此特征定位器很有用。

要提供指示，键入文本说明，获取特征屏幕截图，或使用现有的位图乃至使用预备的音频文件。若在执行测量程序时，操作员显示测头工具箱，但在特征执行前将显示这些说明。

要提供特征定位器说明

1. 从自动特征对话框上的测头工具栏中单击**特征定位器**选项卡 。
2. 添加声音指导。

- 点击**特征定位器WAV文件开关图标**旁边的**选择特征定位器WAV图标**，浏览到与自动特征关联的.wav文件。
- 单击**特征定位器 WAV 切换图标**，在测量例程执行期间播放音频文件。

3. 添加位图。您可选择已有的位图，也可使用当前“图形显示”窗口的屏幕捕获。

- 要选择预先存在的位图文件，单击**特征定位器捕获 BMP 图标**旁边的**选择特征定位器 BMP 文件图标**。浏览 .bmp 文件以关联此自动特征。选择后，选定图像的缩略图显示在**特征定位器**选项卡上。
- 要使用“图形显示”窗口的屏幕捕获，单击**特征定位器捕获 BMP 图标**。捕获图像的缩略图会显示在**特征定位器**选项卡上。此文件被编入索引，并保存在 PC-DMIS 安装目录下。例如，名为 bolthole.prg 的测量程序会生成名为 bolthole0.bmp、bolthole1.bmp、bolthole2.bmp 等的位图。
- 单击**特征定位器 BMP 文件切换图标**，在测量例程执行期间显示位图。

4. 添加文本指导。在**特征指示器文本**输入框，输入您希望显示的文本指导。

5. 单击**创建或确定**，保存在自动特征对话框中所作的更改。

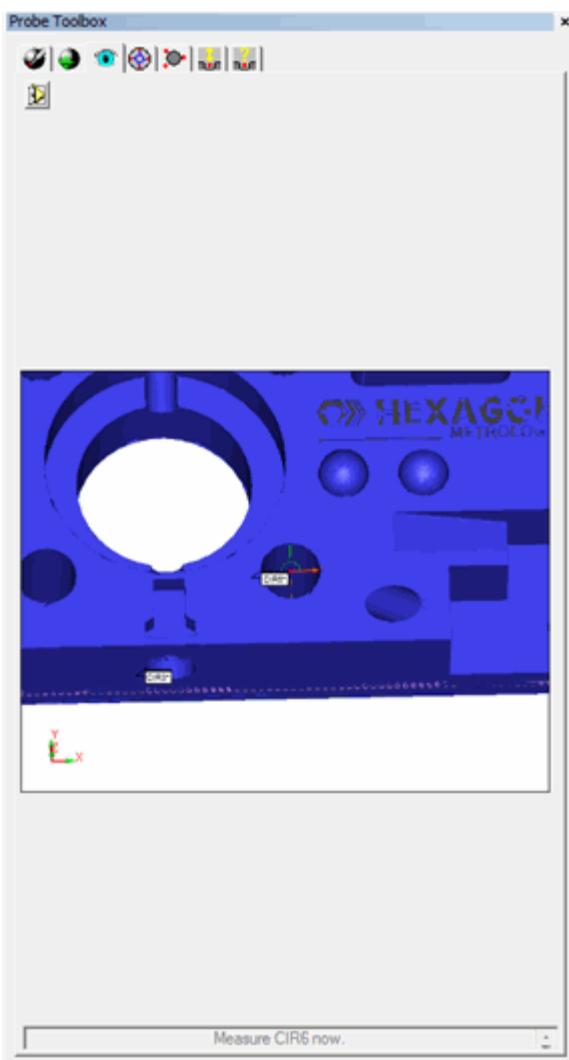
使用特征定位器指导

1. 执行过程中显示测头工具栏。如果执行中测头工具栏不可见，将不会显示指导。通过如下方式可以显示测头工具栏：
 - 开始执行测量例程。
 - 出现执行对话框后，单击**停止按钮**：



- 选择视图 | 测头工具箱显示该工具箱。
 - 点击继续按钮继续执行。
2. 查看说明。当 PC-DMIS

开始执行特征时，测头工具箱的**特征定位器**选项卡上将自动显示说明。



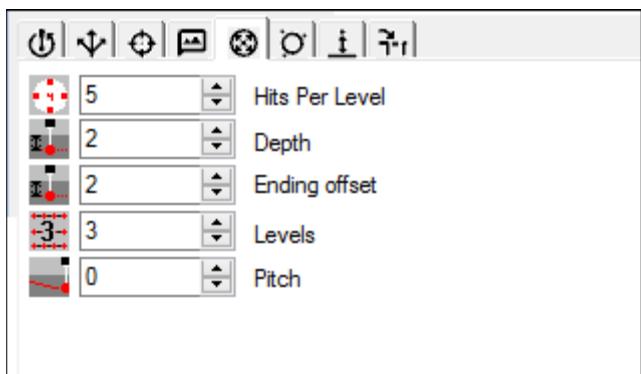
执行时，特征指示器选项卡会提供指导

- 若启用了音频，可根据需要单击**特征定位器 WAV 文件图标**  多次来听取说明。
- 此外，也可将测头工具箱拖出到“图形显示”窗口，并根据需要调整其大小。

3. 当关联的特征测量后，PC-

DMIS会从测头工具栏删除特征指示器选项卡以及其指导。

使用接触路径属性



测头工具箱 - 接触路径属性选项卡

若打开自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动**）并启用接触测头，则**接触路径属性**选项卡将变为可见状态。此选项卡包含的多个项目可用于更改使用接触测头的“自动特征”的各种测点属性。



观察这些属性如何影响测量的一个有用方法是通过使用**显示触测目标切换图标**

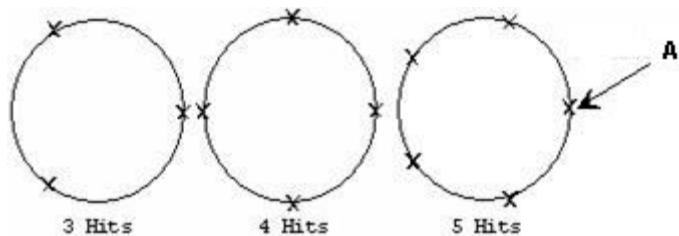


根据在自动特征对话框中所选的特征类型，此选项卡可以变为包含一个或多个以下项目。

测点

此项目支持线、圆、椭圆和圆槽自动特征。此项目定义测量特征时使用的测点数。指定数目的测点应在标明的起始角和终止角之间均匀分布。

- 圆或椭圆特征 - 若起始和结束角度一致，或角度差为 360° 的倍数，则仅在起点与终点共同点采集一个测点。



测点位置

A - 起始角度

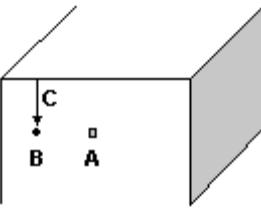
- 圆槽特征 - 若输入测点数量为奇数，则 PC-DMIS 将自动为此值加 1。测量槽时使用的测点数量可以为偶数。一半测点应从槽的每个末端的半圆上采集。所需测点最少为六个。
- 直线特征 - 您可键入任意数目的测点。根据直线类型和输入的值，PC-DMIS 进行如下操作：
 - 若正在创建有界直线，则 PC-DMIS 使用直线的计算长度，并沿直线均匀分布测点，使第一个和最后一个测点位于直线的起点和终点。
 - 若此直线是无边界直线，则 PC-DMIS 使用输入长度值，并沿直线方向矢量均匀分布测点。



如果不键入长度数值（或者数值为零），PC-DMIS
将使用当前的测尖直径作为点间距。

深度

此项目支持棱角点、线、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽和多边形自动特征。此项目定义
PC-DMIS 采集特征测点及其周围样例测点的位置。

自动特征	描述
边界点，凹口槽	<p>如果指定了一个、两个或三个样例测点，则从测定曲面值中应用深度值。</p>  <p>角度点的深度</p> <p>A - 目标测点 B - 目标测点 C - 深度</p>
圆、椭圆、圆槽、方槽、多边形	<p>对于这些特征，深度值经常作为沿着IJK中线矢量方向的正抵消距离来被使用。矢量起始于每个特征的中点。尽管允许负深度值，这对于接触为基础的这些特征的测量是不推荐的。比如，考虑这两个案例：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 案例1：若理论中点在外部特征底部，深度为到特征底部的距离。

- 案例2：若理论中点在外部特征顶部，深度为到特征顶部的距离。

第一个示例中的负值将导致测头进入特征周围的曲面材料内，可能会造成碰撞。

第二个案例的负值可使测头适度接触特征，而正的深度值将移动测头到特征之上，使其无材料可接触。

重要考虑：

中心线矢量

(IJK)：特征矢量的指向不应朝着特征所在的平面（2D 特征）。若包含示例测点（用于 2D 或 3D 特征），此矢量应反映这些示例测点的接近矢量。

高度或长度：若特征的长度或高度为负值，则矢量方向将会反转。

应用正深度的矢量所在方向 (IJK')

会依据以下条件进行更改：

外部特征：

若特征的高度/长度 ≥ 0 , $IJK' = IJK$;

若特征的高度/长度 < 0 , $IJK' = - IJK$ 。

	<p>内部特征：</p> <p>内部特征的 IJK' 指向与外部特征相反的方向。</p>
直线	<p>该距离为沿着垂直直线和边缘矢量方向的正值</p> <p>线的方向取决于当前坐标系下触测点的方向。</p> <p>例如，如果使用的方向为 x 正 · y 正 · z 正，第一和第二触测由左至右，那么深度为正值。但是，如果第一和第二触测从右至左 m，这需要使用负的深度。</p>

起始深度

此项目支持圆柱和圆锥自动特征。

- 对于多层特征，此项目定义第一层测点的起始深度。
- 此项目是以特征顶部为起点的偏置值。
- 其他层应在**起始深度**和**终止深度**之间均匀分布。

结束深度

此项目支持圆柱和圆锥自动特征。

- 对于多层特征，此项目定义最后一层测点的终止深度。
- 此项目是以特征底部为起点的偏置值。
- 其他层应在**起始深度**和**终止深度**之间均匀分布。

结束偏置

此项目支持圆柱和圆锥自动特征。

- 结合特征长度，此项目定义最后一行的位置。
- 若未定义特征长度，结束偏置值将参考最后一行。

总测点数

此项目支持球体自动特征。

- 此项目与测点数一样，但是此项目定义用于测量全部可用行中特征所用的测点总数。
 -
- 测量球体最少需要四个测点。

每层测点

此项目支持圆柱和圆锥自动特征。

- 此项目定义测量特征所用的每层测点数。
- 输入4,意味着每一层触测4点.



每行测点或每环测点

此项目支持平面自动特征。

- 此项目定义在平面特征的每一行或每一环上采集的测点数。
- 行用在方形图案上。
- 环用在径向图案上。
- 更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“模式列表”。
- 测量平面所需测点最少为三个。

每列测点

此项目支持多边形自动特征。此项目定义在多边形特征的每条边上采集的测点数。

层

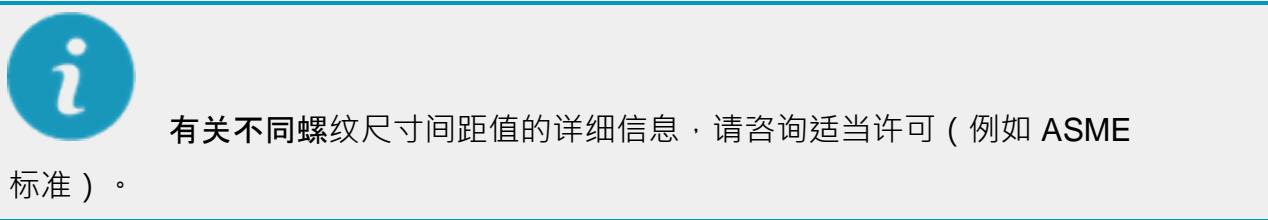
此项目支持圆柱、圆锥和球体自动特征。此项目定义测量特征时使用的层数。可使用大于一的任何整数。第一层测点置于**起始深度**。最后一层测点置于**终止深度**。

- 对于圆柱或圆锥，应在特征的**起始深度**和**终止深度**之间均匀分布各层。
- 对于球体，应在**自动特征对话框**中的**起始角 2**和**终止角 2**值之间均匀分布各层。
- 对于平面，层数和测点数用于确定生成自动平面所需的总测点数。

螺距

此项目支持圆和圆柱自动特征。对于螺纹孔和螺纹轴，**螺距值**（也指每英寸的螺纹数）定义特征轴线的螺纹距离。此选项应考虑对螺纹孔和螺纹轴进行更精确的测量。如果这个值不是零，PC-

DMIS将会沿着理论直线交错的去触测点，同时使用**自动特征对话框**中的**起始角**和**终止角**。



- 圆特征 - 为符合标准的螺旋模式（顺时针），需要调换起始角度和终止角度（即 720 - 0），为使测量从上升倾斜变为下降倾斜（上/下），需要将倾斜度变为负值。

示例：若测量圆（四个测点在圆周围等距分布）：

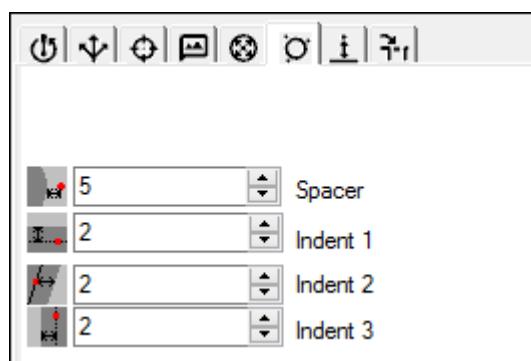
- 第一个测点位于起始角和输入深度处。

- 第二个测点位于第一个测点旋转 90 度的位置，且深度为 (深度 - ((测点数 -1) / 总测点数 * 间距)) 。
- 第三次触测将与第一次触测成 180 度，其深度为 (深度 - ((测点数 -1) / 总测点数 * 间距)) 。
- 其余测点以此类推。
- 圆柱特征 - 示例：若测量圆柱（两层四个测点在圆柱周围等距分布）：
 - 每一层的第一个测点位于起始角和输入深度处。
 - 从第一个测点旋转 90 度是第二个位点位置，第二个测点深度为 (深度 - (测点数 -1) / 每层总测点数 * 间距) 。
 - 第三个测点将会在相同深度上围绕第一个测点转过 180° (深度 - (测点数 -1) / #每层测点数 * 间隙) 。
 - 其余测点以此类推。

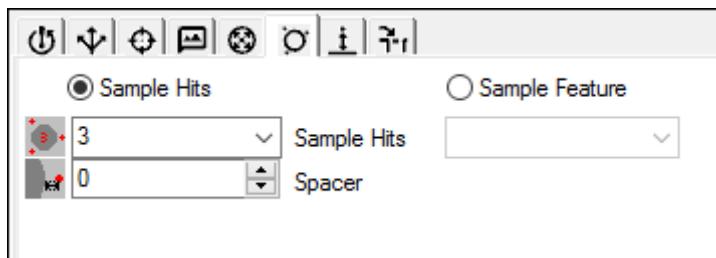
行数

此项目支持平面和球体自动特征。此项目定义测量特征时使用的行数。

使用样例接触点属性



测头工具箱 - 棱角点的接触示例测点属性选项卡示例



测头工具箱 - 圆的接触样例测点属性选项卡示例

若打开自动特征对话框并激活接触测头，则**接触样例测点属性**选项卡将变为可见状态。此选项卡包含的项目可用于更改使用接触测头的“自动特征”的样例测点或样例特征属性。

关于示例测点和示例特征

上述**示例测点**可测量标称点位置周围的曲面，从而提供周围材料的采样。此操作可实现以下几个目的：

1. 调整特征路径 —

因为钣金零件可弯曲或伸展，其测量位置与标称值差别较大。示例测点可对此差异作出解释，通过调整特征路径，可在零件上特征的正确位置上采点。

2. 更改特征投射的平面 -

所有采用样例测点的自动特征都将投射到使用样例测点生成的平面上。这是因为有时特征的标称位置不会自身进行良好触测。



假设要将最顶端的孔作为圆特征进行测量。尝试在该孔的边缘采点，这样做会生成不可靠的测点数据。但是，通过在投射的平面之上的曲面下自动投射更多可靠的测点，使用投射平面可解决这一问题。

示例特征与示例测点的功能相同，但示例特征还有其他好处：测量单一特征并将单一特征用作投射特征，而不是对每个特征都使用示例测点。



若要测量 10

个孔，无需每个圆都采用示例测点，您可将单一平面特征定义为参考特征。PC-DMIS 测量一次该平面，然后将所有圆测量的测点投射到该平面上，使用示例测点进行此操作通常可节省时间。

以下自动特征支持投射特征：曲面点、圆、圆锥、圆柱、椭圆、多边形、圆槽、方槽和线。

对于示例测点和示例特征，仅可使用其中一种，不能同时使用二者。它们的功能相同。



观察这些属性如何影响测量的一个有用方法是通过使用显示触测目标切换图标
显示路径线和测点。

根据**自动特征**对话框中的特征类型，此选项卡可以变为包含一个或多个以下项目。

采样例点

此项目支持曲面点、棱角点、角点、线、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱、圆锥和球体自动特征。选择此项目可启用**样例测点列表并禁用投射特征**项目。您可使用**样例测点列表**为自动特征选择要采集的样例测点数。这些测点用于测量标称点位置周围的平面，从而提供周围材料的采样。这些是永久性样例测点。有关更多信息，请参见“**样例测点 - 特征具体信息**”。

初始样例测点

此项目支持曲面点、棱角点、角点、线、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱、圆锥和球体自动特征。由于较少使用初始样例测点，此列表默认为不出现于用户界面内。通过在“**PC-DMIS 设置编辑器**”内使用 `PTPSupportsSampleHitsInit` 条目，可启用此选项。

您可使用此项目指定初始样例测点。初始样例测点仅在测量例程执行下，进行特征初始测量时采集。

间隙

此项目支持曲面点、棱角点、角点、线、棱角点、平面、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱和圆锥自动特征。该项目定义到标称点位置的距离，若指定样例测点，则 PC-DMIS 将通过此距离测量平面。有关更多信息，请参见“[空格 - 特征具体信息](#)”。

缩进

此项目支持棱角点和凹槽自动特征。对于棱角点，此项目定义从点位置至第一个样例测点的偏置距离。对于凹槽，此项目定义到凹槽闭合边（敞开边对面）的距离。请参见“[缩进 - 特征具体信息](#)”。

缩进 1

此项目支持角点、线和棱角点自动特征。对于角点和棱角点，此项目定义从特征中心位置到两个或三个样例测点的第一个测点的最小偏置距离。对于线，此项目定义从线终点到第二个和第三个样例测点的偏置距离（当已定义三个样例测点）。请参见“[缩进 - 特征具体信息](#)”。

缩进2

此项目支持角点、线和棱角点自动特征。对于角点和棱角点，此项目定义从特征中心位置到两个或三个样例测点的第二个测点的最小偏置距离。对于线，此项目定义从线中点到第一个样例测点的偏置距离。请参见“[缩进 - 特征具体信息](#)”。

缩进3

此项目支持棱角点自动特征。此项目定义从特征中心位置到第三个样例测点（三个）的最小偏置距离。请参见“[缩进 - 特征具体信息](#)”。

示例特征

样例特征项目支持曲面点、圆、圆锥、圆柱、椭圆、多边形、圆槽、方槽、凹槽和线自动特征。该项目可启用其下的特征列表并禁用**样例测点**项目。特征列表包含测量例程中所有现有特征（可用作示例特征）。当前特征测点均投射到所选特征上。若设为**<无>**，则不会进行投射。

样例点-特征的细节信息

自动特征	样例测点说明
曲面点	<p>PC-DMIS 会依据所选的值来测量点。举例，如果您选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0PC- DMIS会根据指定的法线逼近矢量去测量这个点。 • 3, PC- DMIS将会在理论点的周围测量一平面，并且借用由这三个触测点获得的曲面理论矢量来确定理论点的定位。
棱点	<p>PC-DMIS 会依据所选的值来测量点。举例，如果您选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0, PC- DMIS会根据法线逼近及指定的法线矢量去测量这个点。 • 1, PC-DMIS 在法曲面上测量一个点。它通过该店将棱投射到法曲面上。任何深度 = 从该点的偏置值。 • 2, PC- DMIS会在边界上沿着法线矢量方向测量两个样例点。

PC-

DMIS然后使用这两个样例点来计算沿着该棱实际点测新方向矢量的测量值。

- **3, PC-DMIS**

将通过分别使用一个和两个样例测点的组合方法来对点进行测量。此测量方法通常称作“缝宽与平差”测量点。

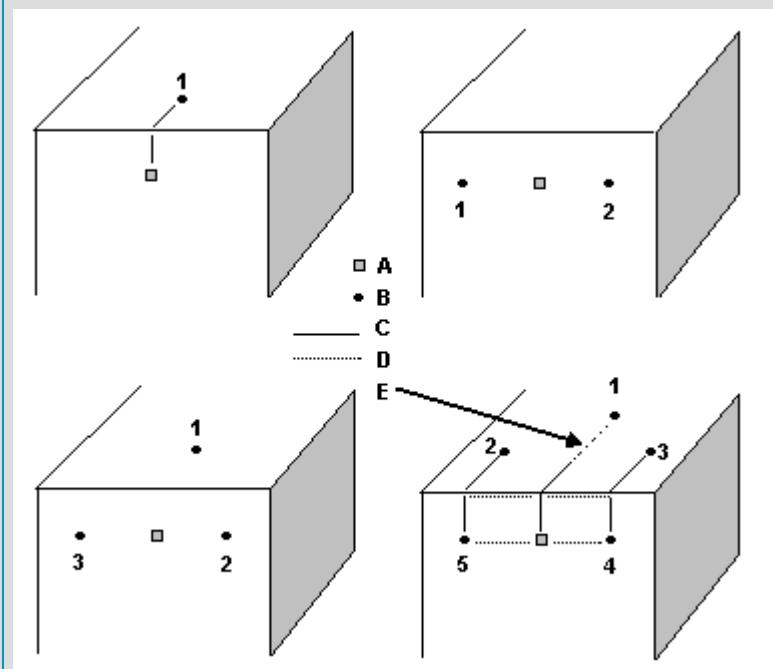
- **4, PC-**

DMIS会测量法曲面上的三个点，并且调整曲面理论矢量。边界点的测量会投影到一个新的法曲面上。任何深度 =

从该点的偏置值。最后，这个点会沿着这个矢量方向进行测量。

- **5, PC-DMIS**

通过在法曲面上采三个点，然后在棱上沿着法线方式防线采两个点来测量该点。此测量方法被认为是最为精确的方法。



用于边界点的样例点

A - 目标测点

B - 样例测点

C - 缩进

D - 空格

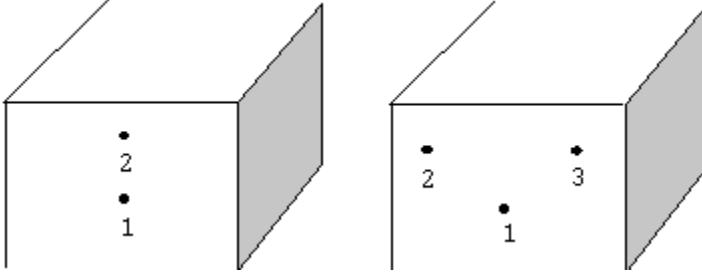
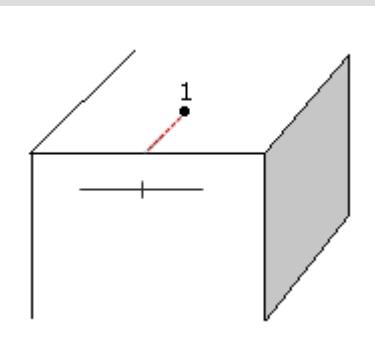
E - 缩进 + 空格

样例触测将在每个曲面使用。PC-DMIS

会依据所选的值来测量点。举例，如果您选择：

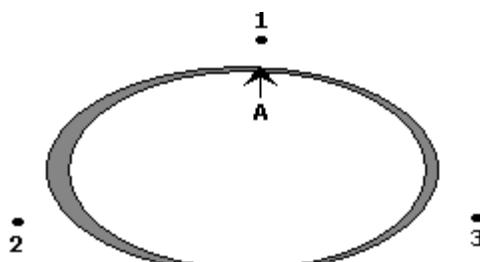
角度点

- **2.** 在垂直于边界矢量的直线上触测点
- **3.** 触测点将会在每一个表面形成一平面，正如图中所指出的一样。

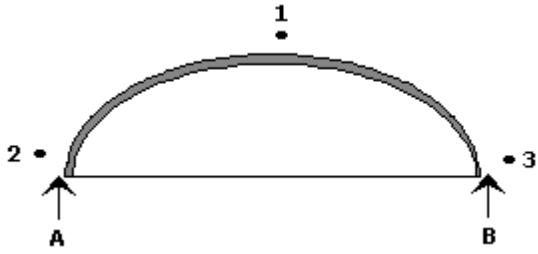
	 <p>对于角点要触测两个和三个样例点</p>
直线	<p>PC-DMIS 会依据所选的值来测量线。举例，如果您选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0, PC- DMIS在离线位置最近的曲面上首先测量单一的样例触测点。然后测量线点。样例触点的最初位置是在线的中间点上。 • 1, PC- DMIS在离线位置最近的曲面上首先测量三个的样例触测点。然后测量线点。样例触点的最初位置是在线的中间点、起点与终点上。  <p>一条线取一个和三个样例触测点。缩进1（点2与3）与缩进2（点1）值不能相同。</p>
圆、柱体或锥体	定义的样例测点将用于测量垂直于特征的曲面。指定数量的

测点将在指定的起始角和终止角之间均匀间隔。PC-DMIS会依据所选的值来测量特征。

- 如果类型=孔, 则选择**0**, PC-DMIS就不会触测样例点。
- 如果“类型 = 双头螺栓”且选择 **0**, PC-DMIS将不采任何样点。PC-DMIS会将特征看作孔而不是双头螺栓来对待**高度**值。
- 如果类型是**HOLE**, 且选择**1**, PC-DMIS会在特征的外表面触测点。
- 如果类型是**STUD**, 且选择**1**, PC-DMIS会在外柱的顶端测量触测点。
- 如果选择**3**, PC-DMIS将会由起始角相同间隔的触测三个空间点来测量这个平面。样例测点将相对于测定平面, 而所有值都将从这些点偏置。



A - 起始角度和终止角度

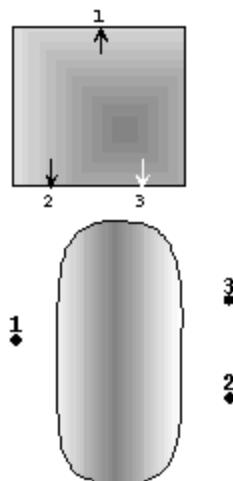
	 <p>A - 起始角度 B - 终止角度</p>
	<p>PC-DMIS 要求键的 X、Y、Z 标称值位于底座。如果中心点位于键的顶部，应将深度和间隙设置为负值。</p>
球	<p>对于球体，您可能仅会选择此样例测点。一旦您执行测量例程，PC-DMIS 会按照此过程进行操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在测量球体之前停止自动测量。 2. PC-DMIS 请求您垂直于球体测量方向采一个点。 3. 采集样例测点之后，单击继续。 4. PC- DMIS 将会在由间隙指定的区域内在球上触测超过三个点 <p>PC-DMIS 采这四个测点，然后使用计算所得的球体位置来计算具有给定数目的测点、行和角度的球体。</p>
方槽或圆槽	<p>所测量的平面用作射影的中心线矢量来测量深度。PC-DMIS 将根据输入值来测量槽。举例，如果您选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0, PC-DMIS 测量所显示的槽。没有进行取样例触测。

- **1, PC-**

DMIS软件会在槽的中心测量曲面。槽的触测会沿着矢量右边方向去测量。

- **3, PC-**

DMIS软件会在槽的三个均匀部位测量三个样例点。样例测点将相对于测定平面，而所有值都将从这些点偏置。



方槽（顶部）和圆槽（底部）上三个测点的样例测点



要在槽的相对边上采点，可翻转中心线矢量。

在 PC-DMIS 2015

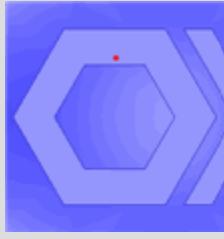
版及之后的版本中更改为圆槽和方槽的示例测点模式

在 PC-DMIS 2015

版及之后的版本中，接触圆槽和方槽的示例测点模式的分布方法发生更改。沿槽缘的同一直线的其中两个测点现在间隔

	<p>分布在在整个槽上。</p> <p>示例 3-测点示例测点模式 (左侧为传统，右侧为 2015 版及之后的版本)</p> <p>当满足以下条件时，仅对圆槽和方槽应用示例测点模式的更改：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 槽为内槽。 • 如果槽为具有间隔正值的外槽。具有间隔负值的外槽仅使用示例测点的传统模式。 <p>在 2015 版之前的版本中创建的测量程序（包含圆槽或方槽）保留示例测点的传统模式。例外情况是，对需要通过 F9 键重新计算路径的槽值作出相关更改。</p>
椭圆	<p>仅可接受的值为0、1与3。所测量的平面用作射影的中心线矢量来测量深度。PC-DMIS 将根据输入值来测量椭圆。举例，如果您选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0, PC-

	<p>DMIS测量所显示的椭圆。没有进行取样例触测。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1, PC- DMIS将会在角矢量的位置触测一个样例点(比如0+间隙),而不是在椭圆的中心 (若椭圆是一孔,这将尤其困难) 3, PC-DMIS 会在椭圆外部(或内部)离外棱指定距离的点的位置 测量曲面(间距值)。第一个测点将位于指定的起始 角度。第二个测点位于起始角度与终止角度之间。最 后一个测点位于终止角度处。这些测点与测量平面有 关,任何数值都将会从这些点出现偏置。
凹口槽	 <p>要在椭圆的相对边上采点,可翻转中心线矢量。</p> <p>样例测点还定义角度矢量的棱以及宽度。仅可接受的值为0到5。所测量的平面用作射影的中心线矢量来测量深度。PC-DMIS 将根据输入值来测量凹槽。举例,如果您选择:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0, PC- DMIS测量所显示的凹槽。没有进行取样例触测。 1, PC-DMIS软件会在凹槽的棱测量曲面。 2, PC- DMIS将会沿着凹槽的开口面测量边界。这将定义角矢量并用于查找凹口槽的宽度。 3, PC-

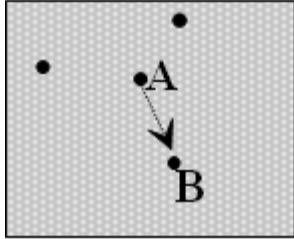
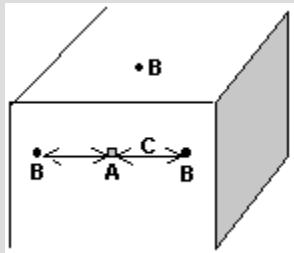
	<p>DMIS将会在凹槽表面的一端测量两个点，另一端测量一个点。凹槽测点将相对于测定平面，而所有值都将从这些点偏置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4, PC- DMIS将会如测量三个样例点一样测量这表面。第四个测点位于将用于查找凹口槽宽度的开口边方向上的棱。 • 5, PC- DMIS将会如测量三个样例点一样测量这表面。另外，它还将按照与两个样例测点相同的方式测量开口边方向上的棱。
多边形	<p>PC-DMIS 会依据所选的值来测量多边形。举例，如果您选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0, PC- DMIS测量所显示的多边形。没有进行取样例触测。 • 1, PC- DMIS将会在角矢量位置触测一个样例点(比如,0+间隙) 。  <p>例子, 多边形特征(海克斯康)触测一个样例点</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3, PC-

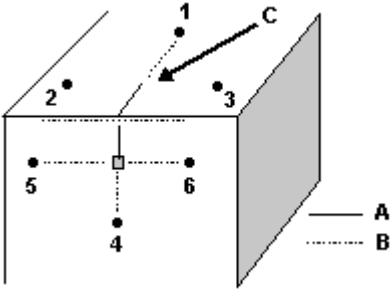
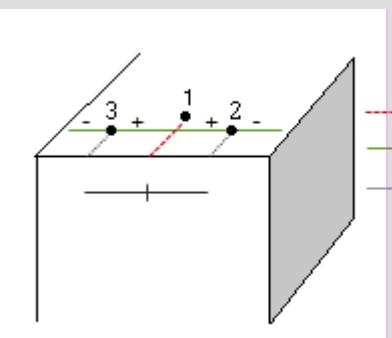
DMIS将会触测三个样例点构成一三角形区域，如果是内多边形。这些样例点在多边形周围的表面上；如果是外多边形，这些样例点在多边形的曲面上。第一个样例点总是在角矢量点指的位置。

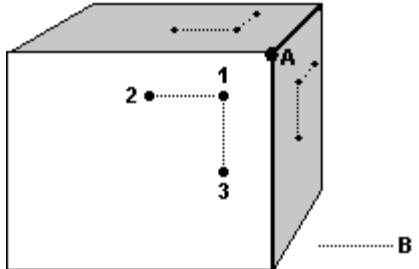
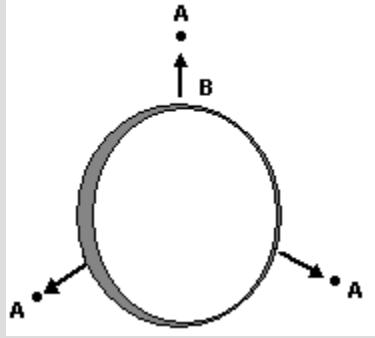


例子, 多边形特征(海克斯康)触测三个样例点

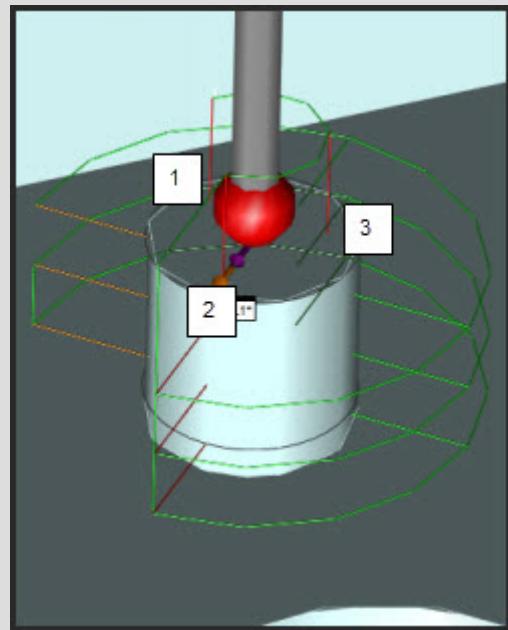
间隙-特征细节信息

自动特征	间隙说明
曲面点	<p>间隙窗口需要根据理论值来定义样例点离圆的距离。</p>  <p>标称和样例点</p>
棱点	<p>间隙定义了理论点和样例点所在的假想圆的半径。</p> 

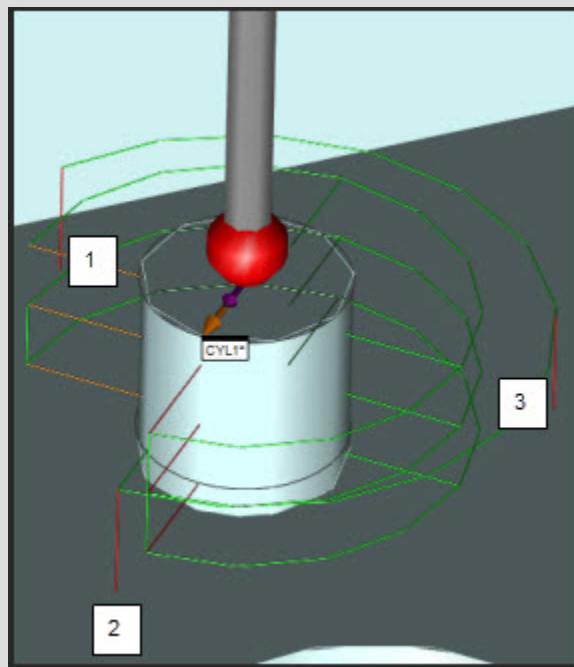
	<p>A - 目标测点 B - 样例测点 C - 空格距离</p>
角度点	<p>间隙定义了每个弯曲面上测点之间的回退距离。</p>  <p>A - 缩进 B - 空格 C - 缩进 + 空格</p>
直线	<p>间隔框定义在三个样例点被定义时，离第二个和第三个样例触测点最初位置的偏置距离。正值则是点之间移近，负值则是彼此远离。</p>  <p>A - 空格 2 B - 空格 C - 空格 1</p> <p>若使用一个单一样例点，则不做任何操作。</p>

隅角点	<p>间隙定义了由第一个点的半径到另一个测点的距离。</p>  <p>A - 目标棱角 B - 空格</p>
圆、圆柱或圆锥	<p>间隙定义了由样例点到圆周的距离</p>  <p>A - 样例测点 B - 空格</p> <p>外部圆柱(圆钉)注意事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 采样点时不使用安全平面。因此，当测量键时，务必要将间隙值设置为允许测头在键周围移动的距离。 PC-DMIS 要求键的 X、Y、Z 标称值位于底座。如果标称中心点位于圆钉的顶部，应将深度和间隙设置为负值。

- 若将间隔设为负数，则间隔距离将朝着标称中心点方向，远离圆柱边缘，同时将在圆柱顶部采集示例测点。若间隔采用正值，则间隔将位于周围零件的曲面上。

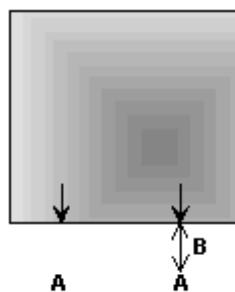


该圆钉有一个最高标称点和一个间隔负值。将在圆柱顶部采集三个示例测点（用红线表示）。



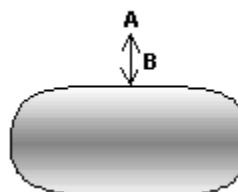
该圆钉有一个最高标称点和一个间隔正值。将在圆柱周围的曲面上采集三个示例测点。

间隙定义的是特征边缘离样例点的距离。



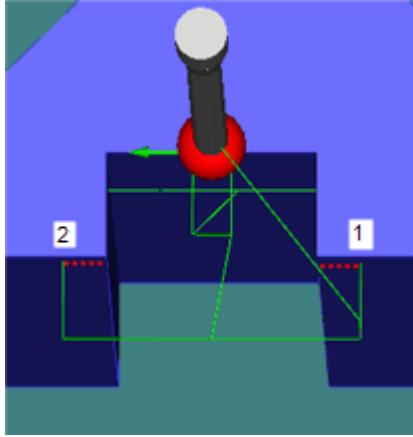
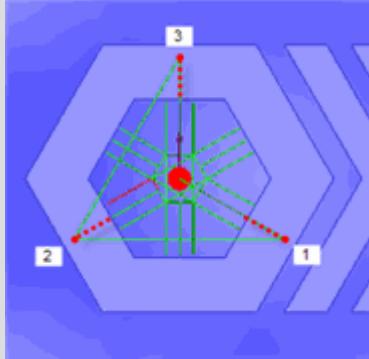
方槽、圆槽
或椭圆

用于方槽或凹口（顶部）的间隔



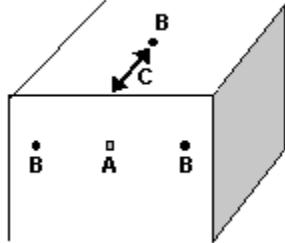
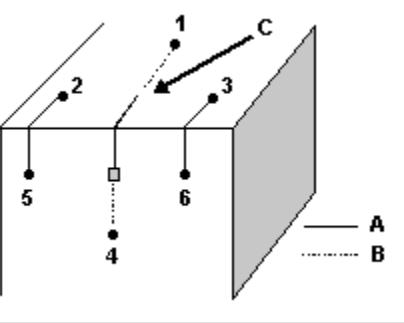
圆槽的间隙

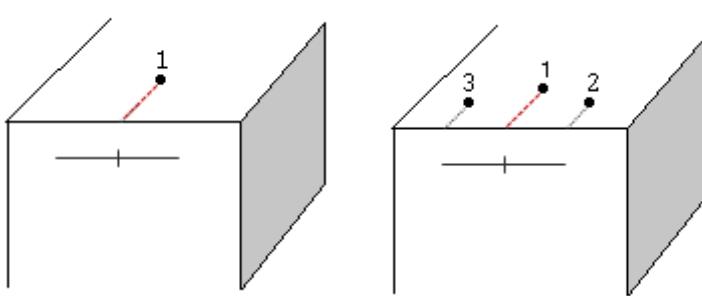
A - 样例测点

B - 空格	
平面	间隙框定义了构成平面的测点之间的距离。
凹口槽	间隙框定义了凹槽样例点到凹槽边缘的距离。 
多边形	间隙框定义了多边形样例点到多边形边缘的距离。 

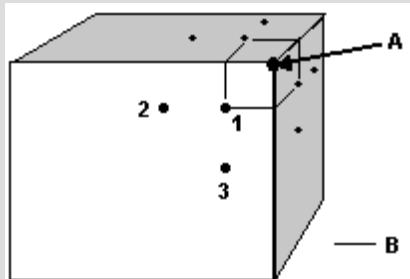
缩进-特征细节信息

自动特征	缩进描述
------	------

	<p>缩进显示了由点位置到每个面第一个测点的最小回退距离。</p>  <p>棱的偏置距离</p> <p>A - 目标测点 B - 样例测点 C - 缩进</p>
<p>角度点</p>	<p>PC-DMIS 提供两个缩进框 · 缩进 1 和缩进 2。</p> <p>2. 这是为了设置由点位置到两个曲面边界样例点的偏移距离。</p>  <p>角度点的缩进</p> <p>A - 缩进 B - 空格 C - 缩进 + 空格</p> <ul style="list-style-type: none"> • 缩进1设置第一个弯曲曲面上样例点位置的偏置距离。 • 缩进2框设置第二个弯曲曲面上样例点位置的偏置距离

	。
直线	<p>PC-DMIS 提供缩进 1 和缩进 2</p> <p>两个缩进框，以设置从点位置到示例测点（位于角度点内弯曲的两个曲面之一上）的偏置距离。</p>  <p>线的缩进</p> <ul style="list-style-type: none"> • 缩进1框定义离点2与3的样例曲面上棱的偏置距离。 • 缩进2框定义离点1的样例曲面上棱的偏置距离。
隅角点	 <p>缩进1与缩进2的值必须不同以获得一个合适的样例平面。</p> <p>PC-DMIS 提供三个缩进框，缩进1，缩进2和缩进3，这三个缩进是为了设置点位置至隅角点内三个弯曲曲面上样例点的偏置距离。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 缩进1框设置从点位置到三个平面中的第一个面上样例点的偏置距离。

- 缩进2框设置从点位置到三个平面中的第二个面上样例点的偏置距离。
- 缩进3框设置从点位置到三个平面中的第三个面上样例点的偏置距离。



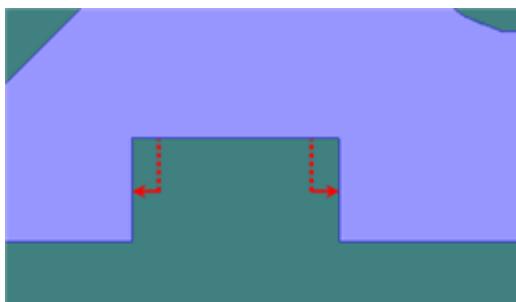
隅角点的缩进。对于其中一个曲面，1 为缩进点，2 和 3 为样例测点

A - 目标棱角

B - 缩进

缩进框用于定义凹槽两个平行边上PC-DMIS采点的位置。是从凹槽闭口端移向开口端的距离。

凹槽



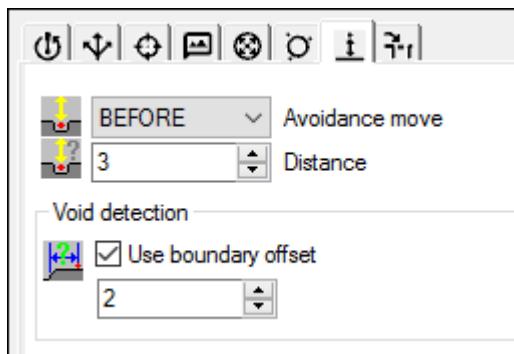
对于凹槽的缩进

如果在CAD上单击自动创建凹槽，PC-DMIS会自动根据用户的测尖尺寸生成凹值。如果需要，之后

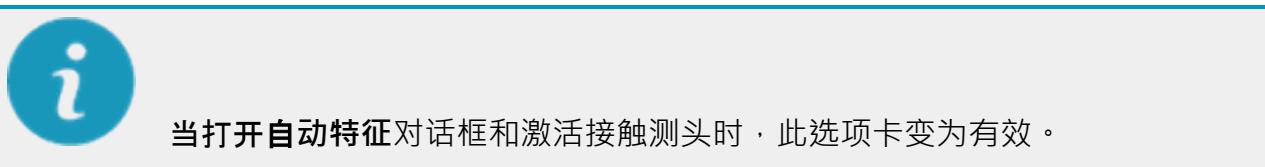
也可以修改。

- 如果您的测尖半径乘以凹口安全因子的值大于凹口的宽度，PC-DMIS会显示一个警告信息告诉用户测尖半径过大。
- 只有您的测尖尺寸乘以凹口安全因子后比凹口的宽度小时，才能生成正确的测量结果。

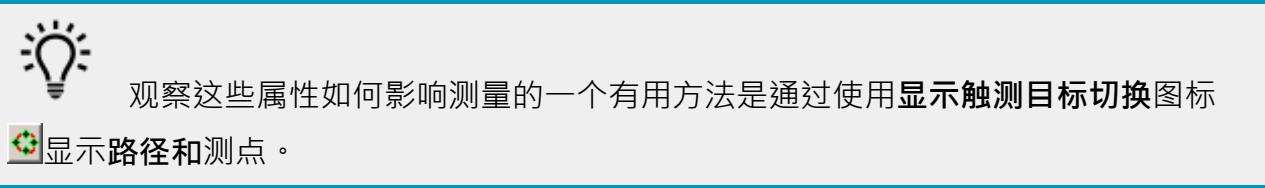
使用接触自动移动属性



平面的接触自动移动属性选项卡



自动移动属性选项卡包含允许更改使用接触测头的自动移动特征的自动移动属性。



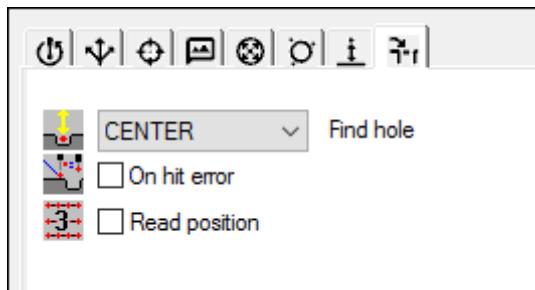
自动移动是添加至特征路径线中的特殊移动，有助于避免 PC-DMIS 实际测量特征时驱使测头沿特征进行移动。

选项卡还控制与允许测量的空隙保持距离。此选项卡包含以下项目。

项目	描述
避让移动	<p>通过此列表可以为当前“自动特征”选择避免移动的类型。此列表包含以下项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 无 - 当前特征不使用避免移动。 • 前 - 在 PC-DMIS 测量当前特征第一个点之前，它将首先移动到第一个触测点的指定距离。 • 后在PC- DMIS测量完当前特征的最后触测点后，它将移动到最后触测点指定距离。 • 两者 - 在 PC-DMIS 测量特征前后都将避免移动距离应用到路径线。
距离	在执行期间，测头移动第一个触测点或最后一个触测点的指定的距离。
无效探测	 <p>该区域仅能在平面自动特征上可见。若用户启动测量属性区域内位于触发</p>

	栏中的无效探测触发器，则可启动使用。
<p>使用边界偏置复选框可确定离采点的空隙边界（边缘）的最小距离。该距离也可定义探测空隙后搜索曲面时所用的软件的递增值。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若清除此复选框，PC-DMIS 将测点放在离空隙边缘测头测尖半径的默认距离处。 • 若选择此复选框，PC-DMIS 将测点放在远离该复选框下方框中指定的边缘处。 	

使用接触查找孔属性



圆特征的接触查找孔属性选项卡

打开自动特征对话框并启用接触测头后，接触查找孔属性选项卡将变为可见状态。当 PC-DMIS 处于 DCC 模式，则这些项目变为可选状态。此选项卡包含的项目可用于更改使用接触测头的“自动特征”的“查找孔”属性。

若从查找孔列表选择程序（非中心、单测点或中心）并执行测量程序，则 PC-DMIS 将测头置于特征的理论中心之上逼近距离的位置。然后驱动法矢量到特征曲面矢量，以接触速度查找孔。持续搜索直至接触到曲面（说明无孔），或直至到达“查找孔”距离（说明上面有孔）。更多信息和示例，请参见计算“查找孔”距离。

若“查找孔”操作失败，则 PC-DMIS 会显示读取位置对话框。该对话框有以下选项：

- **是 -**

可选择从何处读取新位置以继续搜索孔。然后，您可使用操纵盒将测头移至新位置。

- **否 - 可选择跳过此特征，继续下一个特征。PC-DMIS**

将测头从孔移动“避让移动”指定的距离（请参见“使用接触自动移动属性”）并继续运行测量例程。此移动有助于防止出现测头碰撞。

此外，您可以将 PC-DMIS 设置为未找到孔时自动继续执行测量程序。请参见 PC-DMIS 核心文档“设置首选项”一章中的“若查找孔失败自动继续执行”。

根据在**自动特征**对话框中选择的特征，此选项卡可以更改包含以下项的一个或更多个：

- 查找孔
- 触测错误
- 读位置

查找孔

此项目支持以下自动特征：圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形和圆柱。所包含的选项可确定尝试查找孔时 PC-DMIS 的操作方式。若选项不可用，则表示不支持该特征类型。

选项	描述
禁用	不执行“查找孔”操作。
无中心	此项目与 中心 项目的作用一样，但测头不会通过采集三个测点来查找孔中心的大致位置。它仅使用特定 自动特征 对话框中设置的现有参数开始测量圆。
单测点	此设置告知测头采集单个测点。若是触测曲面而未能找到孔，则会自动切换到“若永远找不到孔”的情况（针对圆和槽），或者切换到下面的“查找特定的

	孔”链接中描述的“若找不到孔”的情况（针对凹口）。如果测头找到孔，则使用 非中心 选项继续操作。
中心	此项目首先使测头向下移动至“查找孔”距离，确定未碰到任何物质。然后再移动至特征深度或“检查”距离，查找孔内部并粗略估计孔中心（请参见下文“注册表项”）。测头在孔周围以均匀间距采集三个测点就可完成上述步骤。测头取得孔的常规位置后，继续使用特定 自动特征 对话框内设置的参数测量孔。除非选择 非中心 或单测点，否则找到孔时此步骤是 PC-DMIS 遵循的默认程序。



“查找孔”注册表项提供对于定心过程深度的更大控制。默认情况下，定心过程的 Z 部分由特征深度确定。此项目经常与 Rmeas（平面）特征结合使用。然而，有时当不使用 Rmeas 特征，且零件曲面在 Z 方向上变化极大时，定心过程找不到孔，因为零件曲面位于搜索深度以下。

在这种情况下，可以在“查找孔”中心定位是采用[检测距离*百分比](#)的方法，操作方法为在 PC-DMIS 设置编辑器中设置

`FHCenteringAtChkDistTimesPercentInsteadOfDepth` 为真。此项目位于 `USER_AutoFeatures`

一节。有关检测距离和检查百分比值的信息，请参阅“参数设置：移动选项卡”。

圆或圆柱

下表说明针对圆或圆柱的“查找孔”规格。

若查找到孔	PC-DMIS 向下移动至“检查距离”深度并继续沿孔周围等间距地采集三个测
-------	--

	点，从而确定孔的常规位置。完成此常规调整后，PC-DMIS 使用在特征的选项卡上定义的参数测量孔。其中包括样例测点等。此处与上面说明的“中心”项目相同。
若未找到孔	<p>PC-DMIS 从曲面返回，并开始一次圆形搜索模式，此模式从理论特征中心向外（特征半径 - 测头半径）。搜索应沿搜索圆周围尝试各位置 ($2 * \pi * \text{特征半径} / (\text{特征半径} - \text{测头半径})$)。若仍未找到孔，则通过 (特征半径 - 测头半径) 增加搜索半径，并连续搜索，直至搜索半径等于逼近距离。若逼近比 (特征半径 - 测头半径) 小，则仅完成一个搜索模式。</p>
若从未查找到孔	<p>PC-DMIS 将测头移动到搜索循环最终点上方某一逼近的位置处，并提示您进行一次“读取位置”。（请参见“读取位置项目”。）</p>
沿曲面法线进行调整	<p>由于 PC-DMIS 搜索并找到一个曲面而不是孔，所以 PC-DMIS 将继续在已找到曲面的基础上更新搜索高度。若已找到孔，则 PC-DMIS 会在找到的最后一个平面的基础上更新孔的测量深度。若是第一次找到孔，则无需调整。</p>
通过 RMEAS 调整	<p>若支持 RMEAS 特征，PC-DMIS 假设您要使用特征作为搜索高度和孔测量深度的参照。因此采用 RMEAS 调整而不是沿曲面法线的调整。</p>

方槽和圆槽

下表说明针对方槽或圆槽的“查找孔”规格。

若查找到孔	<p>PC-DMIS 会向下移动至“检查”距离并在槽四边的每一边测量一个测点。P C-DMIS 会调整测点的中心。它会测量其中一个长边上的两个测点，以 调整槽旋转。计算常规位置和槽方向后，PC-DMIS 会使用您在选项卡中为特征所定义的参数，以测量槽。</p>
若未找到孔	<p>PC-DMIS 从曲面返回，并开始一次圆形搜索模式，此模式从理论特征中 心向外（特征半径 - 测头半径）。搜索应沿搜索圆周围尝试各位置（$2 * \pi * \text{特征半径} / (\text{特征半径} - \text{测头半径})$）。若仍未找到孔，则通过（特征半径 - 测头半径）增加搜索半径，并连续搜索，直至搜索半径等于逼 近距离。若逼近比（特征半径 - 测头半径）小，则仅完成一个搜索模式。</p>
若从未查找到孔	<p>PC-DMIS 将测头移动到搜索循环最终点上方某一逼近的位置处。PC-DMIS 会提示您进行一次“读取位置”。（请参见“读取位置项目”。）</p>
沿曲面法线进行调整	<p>由于 PC-DMIS 搜索并找到一个曲面而不是孔，所以 PC-DMIS 将继续在已找到曲面的基础上更新搜索高度。若找到孔，则 PC-DMIS</p>

	会在找到的最后一个平面的基础上更新孔的测量深度。若是第一次找到孔，则无需调整。
通过 RMEAS 调整	若支持 RMEAS 特征，则 PC-DMIS 认为您希望使用特征作为搜索高度和孔测量深度的参照。因此采用 RMEAS 调整而不是沿曲面法线的调整。

凹口槽

下表说明针对凹槽的“查找孔”规格。

若查找到孔	PC-DMIS 将向下移动至“检查”距离以便测量孔的深度并测量此孔。
若未找到孔	PC-DMIS 从曲面退回并开始搜索模式。此模式为循环模式并从理论特征中心（若凹形槽，则是内边中心）向外调整一半宽度。搜索应在此位置周围试验八个位置。若找到孔，则测头会移动一定深度，以便测量孔深并测量孔。
若从未查找到孔	PC-DMIS 将测头移动到搜索循环最终点上方某一逼近的位置处。PC-DMIS 会提示您进行一次“读取位置”。（请参见“读取位置项目”。）

支持界面

所有 DCC

界面都支持“查找孔”功能。如果您在特定的界面上遇到问题，请与技术支持联系。

“触测出错”项目

触测出错项目支持以下自动特征：棱角点、角点、棱角点、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱和圆锥。通过该项目可在 PC-DMIS

检测到意外或丢失的测点时改善错误检查的效果。若选择该复选框，PC-DMIS 会执行以下操作：

- 在测量循环中，仅出现意外测头测点或丢失测头测点，则自动进入读取位置。
- 利用从所读位置获取的新位置测量所有特征。

此选项的编辑窗口命令行显示为：

出错 = TOG

TOG：此切换字段在“是（开）”和“否（关）”之间切换。

有关 PC-DMIS 检测到意外或丢失测点后所用选项的其他信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用流量控制进行分支”一章中的“发生错误时分支”主题。



默认情况下，若 PC-DMIS

执行读取位置操作（比如“读取位置”、“查找孔”或“出现错误”中使用的操作），则 PC-DMIS 仅返回 X 和 Y 值。但是，通过两个注册表项可以进一步控制返回 Z 轴的值。这两个注册表项是：`ReadPosUpdatesXYZ` 和 `ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas`。若这些注册表项设置为 FALSE，则读取位置找到的位置与特征常规矢量对齐并保存为目标。但是由于“边界点”、“角度点”和“棱角点”无常规矢量，但由综合矢量定义，对于这些特征类型，PC-DMIS 不会和 v43 版本以前一样将读取位置与特征矢量对齐。但是，PC-DMIS 会忽略上述注册表项，同时指定读取位置的 XYZ 目标值（TARG 字段）。

支持的界面：所有 DCC

界面都支持测点出错功能。如果您在特定的界面上遇到问题，请与技术支持联系，我们会调查此事。

“读取位置”项目

读取位置项目支持以下自动特征：圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形、圆柱和圆锥。

若选择此复选框，PC-DMIS

会暂停特征曲面之上的执行，并在执行过程中显示以下消息：“读取新测头位置？”。

。执行以下一项操作：

- 若用户希望PC-DMIS使用当前目标位置来测量特征，点击**否**。
- 若希望 PC-DMIS
使用当前测尖位置作为目标值来测量特征，则将测尖移向所需位置，然后单击**是**。
。您将收到以下消息：“要将此位置保存为新目标吗？”执行以下一项操作：
 - 若希望 PC-DMIS
将当前目标位置仅用作当前执行，并不保存此位置用于下一次执行，则单击**否**。
 - 若希望 PC-DMIS
将当前目标位置用作当前执行，同时保存此位置以用于下一次执行，则单击**是**。

若单击**是**，则 PC-DMIS

会要求将测头置于靠近特征中心的区域内。随后将根据下表中的其中一个选项自动确定测量的深度和方向。

选项	描述
RMEAS 特征	若提供 RMEAS 特征，PC-DMIS 认为您希望测量与此特征相关的孔。因此，特征将被用于曲面法向与深度的测量，而读取POS将被用于另外的两个轴的转化。

	 <p>如果搜索特征失败，则将显示“读取新测头位置？”。在此情况下，单击否继续进行下一个特征。</p>
查找孔	若使用“查找孔”操作，且至少接触孔周围曲面一次，则 PC-DMIS 会调整所有的三个轴。一旦找到孔，其中两个轴将基于测头位置。沿曲面法线的第三个轴将基于最后接触的曲面。“查找孔”操作将不会覆盖 RMEAS 特征。
采样例点	若使用样例测点，则样例测点始终是确定孔测量方向和深度的首选点。
以上都不是	若不使用上述任何选项，则 PC-DMIS 应以提供的目标和深度值对孔进行探测，并在圆柱区域内利用测头位置调整。

 <p>默认情况下，若 PC-DMIS 执行读取位置操作（比如读取位置复选框、查找孔列表或测点出错复选框中使用的操作），则 PC-DMIS 仅返回 X、Y 值。但是，通过两个注册表项可以进一步控制返回 Z 轴的值。这两个注册表项是：<code>ReadPosUpdatesXYZ</code> 和 <code>ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas</code>。</p>
--

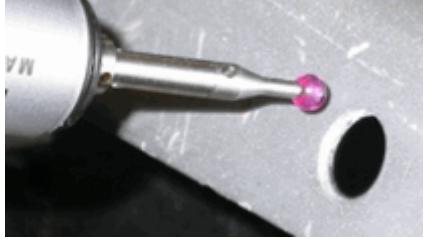
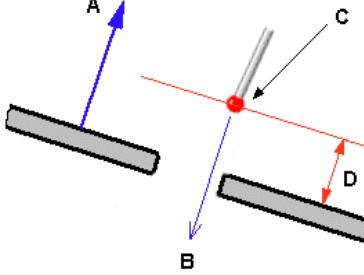
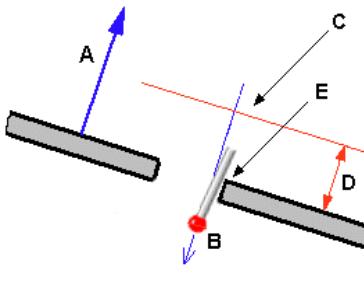
关闭查找孔的默认最后触测调整

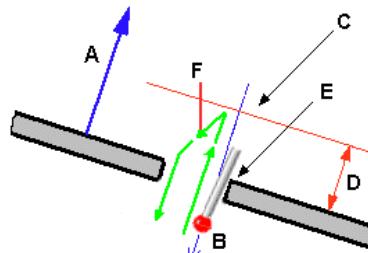
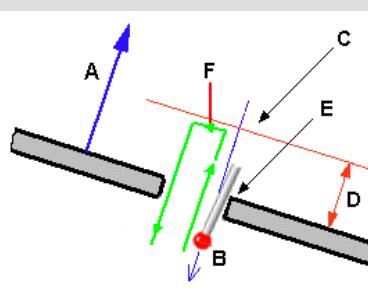
在“查找孔”操作中，当测头注册一个测点，它的红色测尖通常会与曲面（表示还未找到孔）接触，下一次搜索测点的 Z 值将会根据上次触测的 Z

值进行调整。这是你一般会希望的显示方式，但在有些情况下你想关闭调整。您可以在 PC-DMIS 设置编辑器中将 `AdjustFindHoleByLastHit` 设为 FALSE 以完成此操作。



如果用户的测头不能移动到一个匹配特征向量的测尖角度，用户的测头柄可能会在找到孔操作中与孔的边缘接触，导致PC-DMIS假定的一个注册触测位于零件的表面红色测尖的位置。默认情况下，PC-DMIS会尝试使用上次的Z值调整下一次搜索触测的Z值，将会导致不好的移动。如果关闭了默认的最后触测调整，则在这种情况下，PC-DMIS使用未经调整的Z值继续搜索。

事件的序列	图和说明
帧1 测尖角度与孔 的向量不匹配 。 	 A - U、V、W B - 搜索方向 C - 移动 D - 接近距离
帧2 导致测头的柄 与零件的边缘 在E点接触，并 在B注册了触测 。 	 A - U、V、W B - 测点 C - 移动

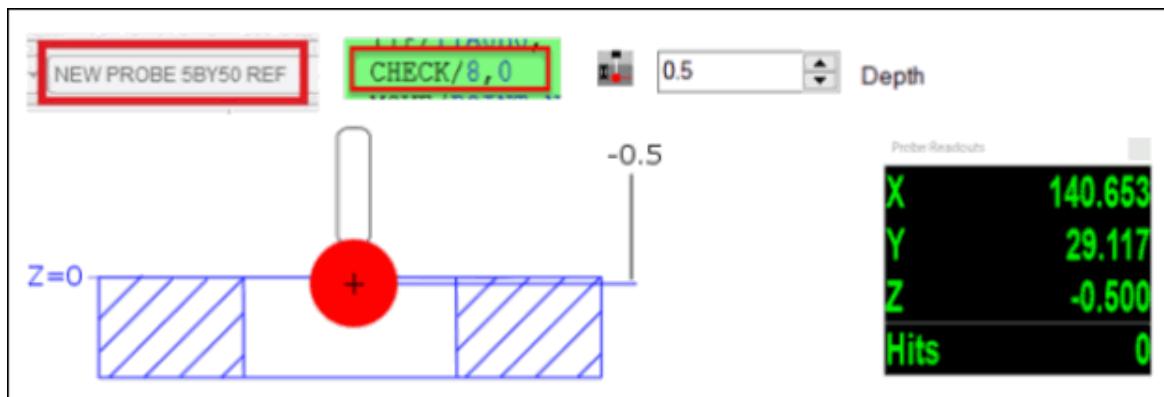
		D - 接近距离 E - 杆接触
帧3 (默认行为) 默认情况下，PC-DMIS会为下次搜索触测调整Z值，但是在这个情况下，会导致位于F的错误移动。	通过上次触测调整查找孔设置为是	 <p>A - U、V、W B - 测点 C - 移动 D - 接近距离 E - 杆接触 F - 错误移动</p>
帧3 (修改行为) 但是，若关闭默认调整，PC-DMIS 会采用F处的正确移动继续搜索孔。	通过上次触测调整查找孔设置为否	 <p>A - U、V、W B - 测点 C - 移动 D - 接近距离 E - 杆接触 F - 正确移动</p>

计算“查找孔”距离

PC-DMIS 如下计算“查找孔”距离：

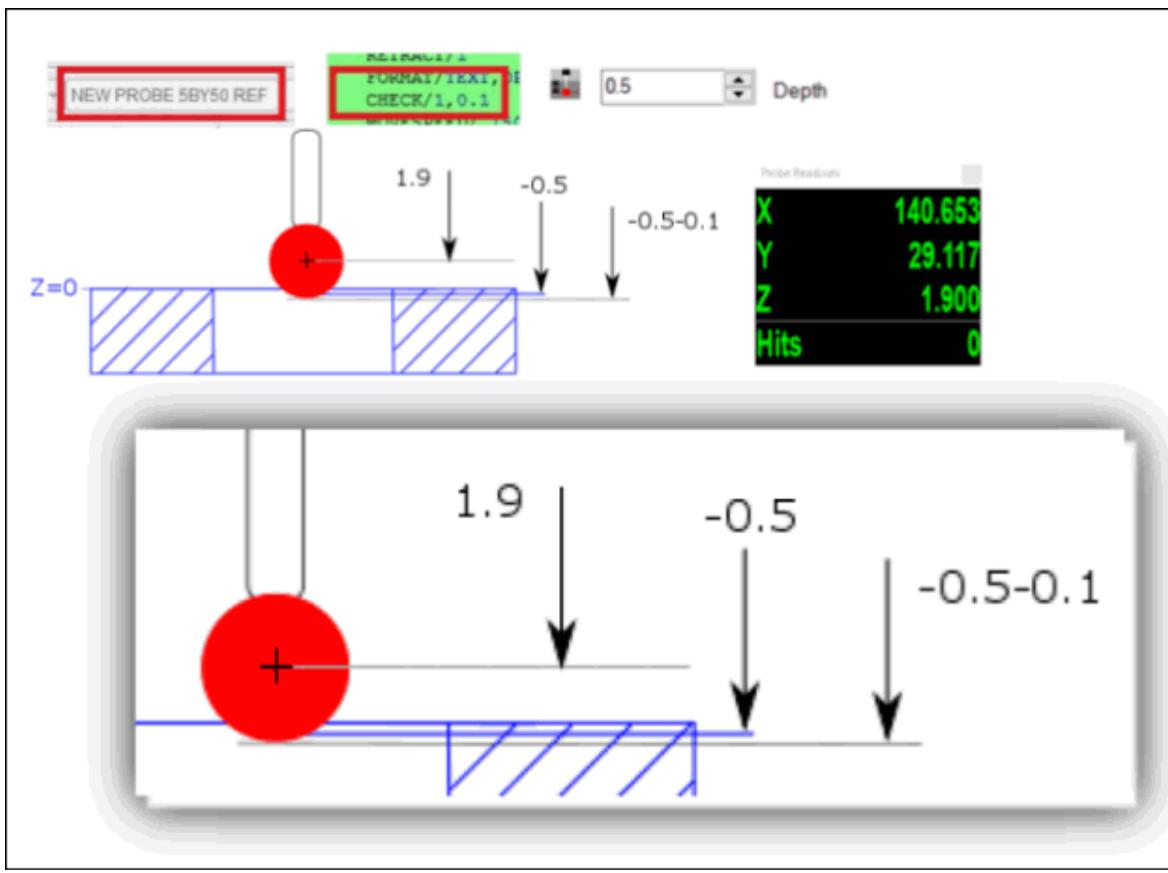
- 若检查百分比 = 0, 测尖的中心将移动至深度距离。

在以下示例中, 测头的中心移动至特征内部的 0.5 毫米 (检查百分比 = 0, 深度 = 0.5) :



- 若检查百分比 > 0 或 ≤ 1 , 测头表面移动深度 + (检查 * 检查百分比) 距离。

在以下示例中, 测头的表面移动至特征内部的 0.6 毫米。此结果的计算方式为 : 0.5 毫米深度 + (1 公厘 * 0.1 百分比) 。



使用测量策略

对特定自动特征使用测量策略可选择预先定义的方案，更改 PC-DMIS 测量这些特征的方式。测量策略如下分组：

- PC-DMIS 默认测量策略 - 此策略是默认的触点策略。其适用于所有自动特征。
- 自适应扫描策略 -

这些策略的名称以“自适应”开头。执行测量程序时，这些策略将参考数据库确定扫描参数。
- 非自适应扫描策略 -

这些策略（量规扫描校准、圆柱置中螺纹扫描和自定心点）不需要参考数据库即可确定扫描参数。

- TTP 策略 - 这些策略的名称以“TTP”开头。这些策略使用接触触发点测量特征。



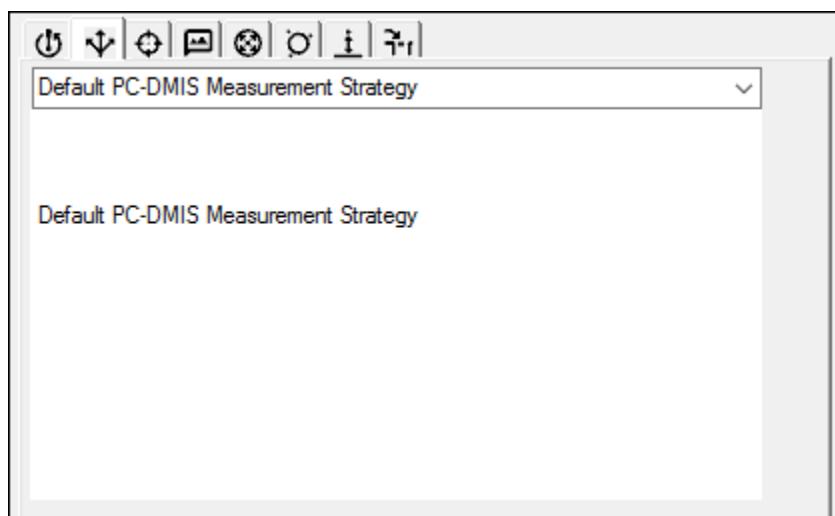
为获得所有测量策略的最佳结果，应在 PC-DMIS 设置编辑器中启用 VHSS。



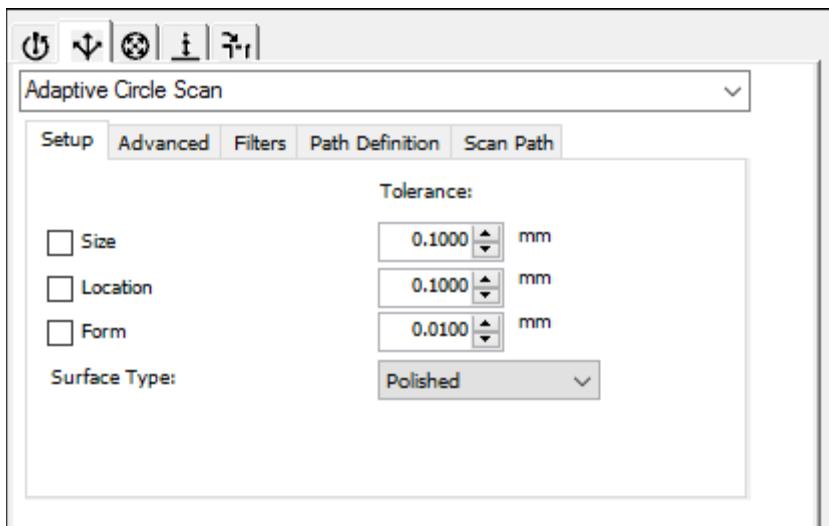
请勿将混淆此主题与测量策略编辑器 (MSE) 功能。该功能使用更广意义上的“测量策略”。通过 MSE 可修改和存储所有自动特征设置的自定义组。有关 MSE 的更多信息，请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“使用测量策略编辑器”。

要选择测量策略，请执行以下操作：

1. 从测头工具箱中选择测量策略选项卡 ()。PC-DMIS 最开始显示默认 PC-DMIS 测量策略。



2. 单击下拉箭头，然后选择要使用的测量策略。测头工具箱选项卡会作出更改，仅显示适用于该策略的选项卡。例如，自适应圆扫描（适用于扫描测头）策略类似于：



“测头工具箱”选项卡示例

3. 使用所有有关策略的已知信息完成测量策略选项卡（设置、高级和筛选器等）上的属性。
 - 要完成自适应扫描策略的属性，请参见“使用自适应扫描策略”。
 - 要完成非自适应扫描策略的属性，请参见“使用非自适应扫描策略”。
 - 要完成 TTP 策略的属性，请参见“使用 TTP 策略”。
4. 要测试特征，单击测试。
 - 对于 PC-DMIS 默认测量策略，PC-DMIS
会根据自动特征对话框中指定的设置测量特征。
 - 对于自适应扫描测量策略，PC-DMIS
将根据策略选项卡上指定的参数扫描特征。
 - 对于非自适应扫描策略，PC-DMIS
将根据策略选项卡上指定的设置测量特征。
 - 对于 TTP 策略，PC-DMIS
将根据策略选项卡上指定的设置测量带触点的特征。

5. 单击创建。若选择了**特征属性**区域中**立即测量切换图标**()，测头会根据**高级**选项卡上指定的设置采用特征位置及其他特征的自动特征属性进行移动。

使用自适应扫描策略

并非每个访问扫描硬件的用户都是专家，同时了解如何配置影响精度和吞吐量的各种控制参数，例如扫描速度、点密度、偏置力。有了自适应扫描，用户无需是专家，因为自适应扫描会消除猜测的配置，例如扫描参数。自适应扫描系统拥有专业知识，可根据已知输入（例如公差、特征类型和大小、探针长度和表面光洁度）计算这些参数。您只需提供已知信息。自适应扫描算法就会执行选择其他设置的工作。

自适应扫描是“控制器感知”。这就是说，如果控制器上拥有某项能提高扫描精度和吞吐量的功能，该软件会自动根据需要使用这些功能。

自适应扫描特征的测量策略仅对模拟测尖适用。

这些策略位于测头工具箱中的**测量策略**选项卡上。测量策略如下：

- 圆自动特征：
 - 自适应圆扫描策略
- 圆锥自动特征：
 - 自适应圆锥同心圆扫描策略
 - 自适应圆锥线扫描策略
- 圆柱自动特征：
 - 自适应圆柱线扫描策略
 - 自适应圆柱螺旋扫描策略
- 线自动特征：
 - 自适应线性扫描策略
- 平面自动特征：

- 自适应自由形状平面扫描策略
- 自适应平面圆扫描策略
- 自适应平面线扫描策略

有关选择和使用测量策略的完整信息，请参见“[使用测量策略](#)”。

自适应圆扫描策略

圆自动特征的自适应圆扫描策略通过扫描来测量圆。

策略的选项卡位于自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 圆**）中的测头工具箱中：

- **设置**选项卡
- **高级**选项卡
- **筛选器**选项卡
- **路径定义**选项卡
- **扫描路径**选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“[使用测量策略](#)”。

“设置”选项卡 - 自适应圆扫描策略

使用自适应圆扫描策略的**设置**选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息。
· PC-DMIS 将执行剩余操作。

尺寸

如果测量的目的是尺寸公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**尺寸公差**值扫描特征。如果所输入的**尺寸公差**值过大或过小，PC-DMIS 将非常缓慢地扫描特征。否则，PC-DMIS 将很快地扫描特征。

位置

如果测量的目的是位置公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS会根据所输入的**位置公差值**扫描特征。**位置公差值**越小，扫描速度越慢。**位置公差值**越大，扫描速度越快。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择**尺寸、位置和形状**框所允许的限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应圆扫描策略

使用自适应圆扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度、扫描速度、加速度和偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

扫描类型

选择在控制器上执行的扫描类型：

- **已定义** - 在 B3C、B4 或 FDC 控制器上执行已定义的路径扫描。
- **CIR** - 在 B4 或 B5 Leitz 控制器上执行 CIR 型扫描。

“筛选器”选项卡 - 自适应圆扫描策略

使用自适应圆扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

离群值

您可选择根据最佳拟合特征的距离移除离群值。这允许删除生成于测量过程中的异常。

PC-DMIS

首先将圆拟合至数据，然后根据标准偏差倍数确定哪些点是离群值。然后执行以下操作：

- 应用那些已被剔除的局外点来重新计算出最佳拟合圆特征。
- 再次复检局外点
- 重新计算出最佳拟合圆特征。
- 继续重复此过程，直到离群值不再存在或直到 PC-DMIS 无法计算圆。（若少于三个数据点，则 PC-DMIS 无法计算圆。）

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** – 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

UPR

键入或选择每转波动。默认值是 50。若在筛选器列表中选择**无**，则此项目会被隐藏。

使用计量扫描过滤

要校正测定的扫描数据（通过将其与计量中的类似扫描数据进行比较），则选择此复选框。有关更多信息，请参见“启用计量扫描筛选器”。

“路径定义”选项卡 - 自适应圆扫描策略

自适应圆扫描策略的**路径定义**选项卡提供一些额外选项来定义圆形扫描路径。只要更新路径定义参数，即可查看扫描路径。您也可查看“图形显示”窗口中更新的扫描路径。

控制元素

选择是在圆柱形还是球形上完成圆扫描。

路径密度

键入将生成用于创建扫描路径的每毫米点数。

球心

在**控制元素**列表中选择**球形**时，会出现此属性。对于此属性，派生扫描的矢量不位于圆平面中，但垂直于球面。此扫描类型的一大作用就是进行 ISO10360-4 测试。**X**、**Y** 和 **Z** 框为零件坐标系。

“扫描路径”选项卡 - 自适应圆扫描策略

使用**自适应圆扫描策略**的**扫描路径**选项卡显示扫描点。

以下项目将出现在点列表区域中：

- # - 识别生成的点的数字
- X、Y 和 Z - XYZ 值
- I、J 和 K - IJK 值

自适应圆锥同心圆扫描策略

圆锥自动特征的自适应圆锥同心圆扫描策略沿圆锥轴在各种不同高度上执行多次同心圆测量。

策略的选项卡位于自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动 | 圆锥）中的测头工具箱中：

- 设置选项卡
- 筛选器选项卡
- 高级选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应圆锥同心圆扫描策略

使用自适应圆锥同心圆扫描策略的设置选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

尺寸

如果测量的目的是尺寸公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的尺寸公差值扫描特征。如果所输入的尺寸公差值过大或过小，PC-DMIS 将非常缓慢地扫描特征。否则，PC-DMIS 将很快地扫描特征。

位置

如果测量的目的是位置公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的位置公差值扫描特征。位置公差值越小，扫描速度越慢。位置公差值越大，扫描速度越快。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择**尺寸、位置和形状**框所允许的限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应圆锥同心圆扫描策略

使用自适应圆锥同心圆扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度、扫描速度、加速度和偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

扫描类型

选择在控制器上执行的扫描类型：

- **已定义** - 在 B3C、B4 或 FDC 控制器上执行已定义的路径扫描。
- **CIR** - 在 B4 或 B5 Leitz 控制器上执行 CIR 型扫描。

“筛选器”选项卡 - 自适应圆锥同心圆扫描策略

使用自适应圆锥同心圆扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

离群值

您可选择根据最佳拟合特征的距离移除离群值。这允许删除生成于测量过程中的异常。

PC-DMIS

首先将圆拟合至数据，然后根据标准偏差倍数确定哪些点是离群值。然后执行以下操作：

- 应用那些已被剔除的局外点来重新计算出最佳拟合圆特征。
- **再次复检局外点**
- 重新计算出最佳拟合圆特征。
- 继续重复此过程，直到离群值不再存在或直到 PC-DMIS 无法计算圆。（若少于三个数据点，则 PC-DMIS 无法计算圆。）

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** – 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

UPR

键入或选择每转波动。默认值是 50。UPR

仅适用于圆柱和圆形。若在筛选器列表中选择无，则此项目会被隐藏。

自适应圆锥线扫描策略

圆锥自动特征的自适应圆锥线扫描策略在特定圆锥上执行多次线扫描。

策略的选项卡位于自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动 | 圆锥）中的测头工具箱中：

- 设置选项卡
- 筛选器选项卡
- 高级选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应圆锥线扫描策略

使用自适应圆锥线扫描策略的设置选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的形状公差值扫描特征。形状公差值越大，扫描速度越快。形状公差值越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择允许限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应圆锥线扫描策略

使用自适应圆锥线扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度**、**扫描速度**、**加速度**和**偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

“筛选器”选项卡 - 自适应圆锥线扫描策略

使用自适应圆锥线扫描策略的**筛选器**选项卡设置筛选器。

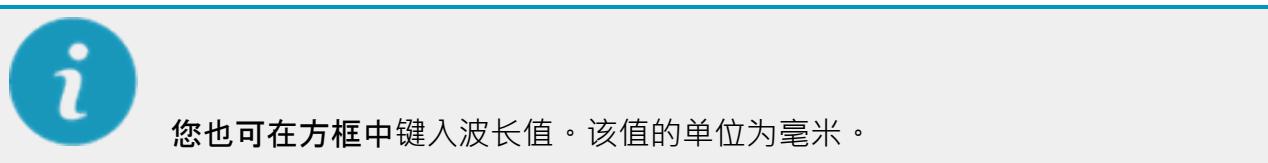
筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** - 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

波长(毫米)

应用线性高斯筛选器时，小于您在列表中所选的值的数据中的振荡会更平顺。这一点适用于直线和平面。



若在筛选器列表中选择**无**，则此选项会被隐藏。

自适应圆柱线扫描策略

圆柱自动特征的自适应圆柱线扫描策略沿平行于其轴的圆柱扫描多条线。圆柱可以是螺纹曲面，也可以是平滑曲面。

使用此策略时，测头测尖的直径必须大于螺纹间凹处的尺寸，以防止测头晃动。

策略的选项卡位于自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 圆柱**）中的测头工具箱中：

- **设置**选项卡
- **筛选器**选项卡
- **高级**选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应圆柱线扫描策略

使用自适应圆柱线扫描策略的**设置**选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择允许限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应圆柱线扫描策略

使用自适应圆柱线扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度**、**扫描速度**、**加速度**和**偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

预触测圆柱

此值可采集触点，在扫描前查找圆柱。

螺纹孔

若用户选择该复选框可打开 B3 控制器上的筛选器，以增加扫描螺纹时的精度。

“筛选器”选项卡 - 自适应圆柱线扫描策略

使用自适应圆柱线扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** – 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

波长(毫米)

应用线性高斯筛选器时，小于您在列表中所选的值的数据中的振荡会更平顺。这一点适用于直线和平面。



若在筛选器列表中选择**无**，则此选项会被隐藏。

自适应圆柱螺旋扫描策略

圆柱自动特征的自适应圆柱螺旋扫描策略执行一次螺旋扫描测量模式。

策略的选项卡位于自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动 | 圆柱）中的测头工具箱中：

- 设置选项卡
- 筛选器选项卡
- 高级选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应圆柱螺旋扫描策略

使用自适应圆柱螺旋扫描策略的设置选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

尺寸

如果测量的目的是尺寸公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的尺寸公差值扫描特征。如果所输入的尺寸公差值过大或过小，PC-DMIS 将非常缓慢地扫描特征。否则，PC-DMIS 将很快地扫描特征。

位置

如果测量的目的是位置公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的位置公差值扫描特征。位置公差值越小，扫描速度越慢。位置公差值越大，扫描速度越快。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的形状公差值扫描特征。形状公差值越大，扫描速度越快。形状公差值越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择**尺寸、位置和形状框**所允许的限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应圆柱螺旋扫描策略

使用自适应圆柱螺旋扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度、扫描速度、加速度和偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

扫描类型

选择在控制器上执行的扫描类型：

- **已定义** - 在 B3C、B4 或 FDC 控制器上执行已定义的路径扫描。
- **CIR** - 在 B4 或 B5 Leitz 控制器上执行 CIR 型扫描。

“筛选器”选项卡 - 自适应圆柱螺旋扫描策略

使用自适应圆柱螺旋扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

离群值

PC-DMIS

首先将圆拟合至数据，然后根据标准偏差倍数确定哪些点是离群值。然后执行以下操作：

- 应用那些已被剔除的局外点来重新计算出最佳拟合圆特征。
- **再次复检局外点**
- 重新计算出最佳拟合圆特征。
- 继续重复此过程，直到离群值不再存在或直到 PC-DMIS 无法计算圆。(若少于三个数据点，则 PC-DMIS 无法计算圆。)

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** - 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

UPR

键入或选择每转波动。默认值是 50。UPR

仅适用于圆柱和圆形。若在筛选器列表中选择**无**，则此项目会被隐藏。

自适应线性扫描策略

线自动特征的自适应线性扫描策略沿指定的线执行一次线扫描。

策略的选项卡位于自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动 | 线）中的测头工具箱中：

- 设置选项卡
- 筛选器选项卡
- 高级选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应线性扫描策略

使用自适应线性扫描策略的设置选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择允许限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应线性扫描策略

使用自适应线性扫描策略的高级选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度**、**扫描速度**、**加速度**和**偏置力属性**，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

“筛选器”选项卡 - 自适应线性扫描策略

使用自适应线性扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

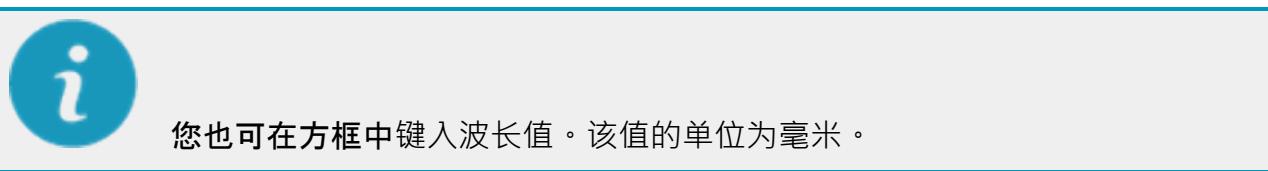
筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** – 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

波长(毫米)

应用线性高斯筛选器时，小于您在列表中所选的值的数据中的振荡会更平顺。这一点适用于直线和平面。



若在筛选器列表中选择**无**，则此选项会被隐藏。

自适应自由形状平面扫描策略

平面自动特征的自适应平面圆扫描策略通过沿由一系列点定义的路径移动扫描平面。该扫描路径可以是连续的，可以包含断点，也可以包含移动点。扫描路径中的断点和移动点有助于将面作为一个平面进行扫描，即使由于任何原因路径不是连续的。

运行测量程序时，可从文本文件中动态读取扫描路径。此功能有助于扫描零件变体上的平面，在该平面上所扫描的平面形状在变体间发生变化。

策略的选项卡位于**自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动 | 平面）**中的测头工具箱中：

- **设置**选项卡
- **筛选器**选项卡
- **高级**选项卡
- **路径定义**选项卡
- **扫描路径**选项卡
- **执行**选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“**使用测量策略**”。

“设置”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略

使用自适应自由形状平面扫描策略的**设置**选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择允许限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略

使用自适应自由形状平面扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度**、**扫描速度**、**加速度**和**偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

“筛选器”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略

使用自适应自由形状平面扫描策略的**筛选器**选项卡设置筛选器。

离群值

PC-DMIS

首先将圆拟合至数据，然后根据标准偏差倍数确定哪些点是离群值。然后执行以下操作：

- 应用那些已被剔除的局外点来重新计算出最佳拟合圆特征。
- **再次复检局外点**
- 重新计算出最佳拟合圆特征。
- 继续重复此过程，直到离群值不再存在或直到 PC-DMIS 无法计算圆。(若少于三个数据点，则 PC-DMIS 无法计算圆。)

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** – 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

波长(毫米)

应用线性高斯筛选器时，小于您在列表中所选的值的数据中的振荡会更平顺。这一点适用于直线和平面。



若在筛选器列表中选择**无**，则此选项会被隐藏。

“路径定义”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略

使用自适应自由形状平面扫描策略的**路径定义**选项卡可生成扫描路径。

类型

扫描路径可通过以下几种方法生成：

- 边界路径
- 自由形状路径
- 示教路径

点列表区域

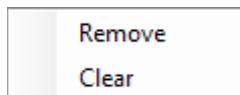
点列表区域显示在 CAD 上选择的点或在 CMM 上手动采集的点（仅适用于示教路径类型）。

- 显示识别点的数字或字母。

X、Y、Z - XYZ 值显示在此区域中。

点类型 - 此栏表示生成扫描路径的示教路径方法的点类型。

要删除点，右击点列表区域。屏幕上将出现**删除**和**清除**选项：



点选项

删除 -

要删除一个点，在点列表区域中突出显示该点并右击该点，然后选择此选项。

清除 -

要删除所有点，右击点列表区域，然后选择此选项。当屏幕上出现**删除所有点？**消息时，单击**确定**。

>>

要为所选类型设置其他属性并生成扫描路径，请单击此按钮。

<<

要返回点列表区域，请单击此按钮。

边界路径

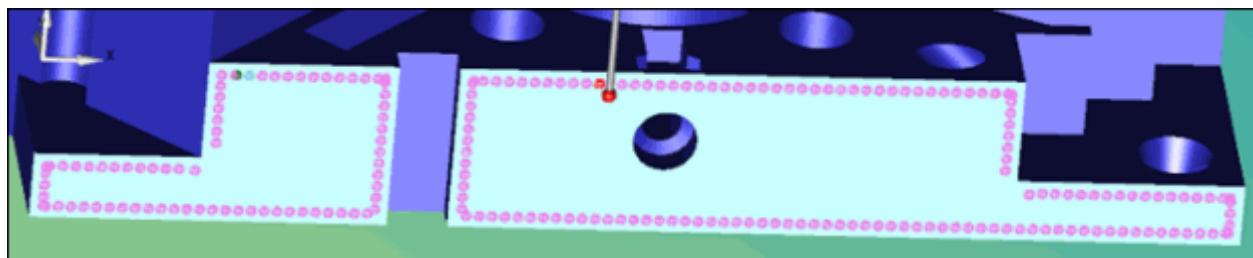
使用此方法可生成沿曲面边界的扫描路径。此步骤需要使用 CAD。

生成默认周边扫描路径

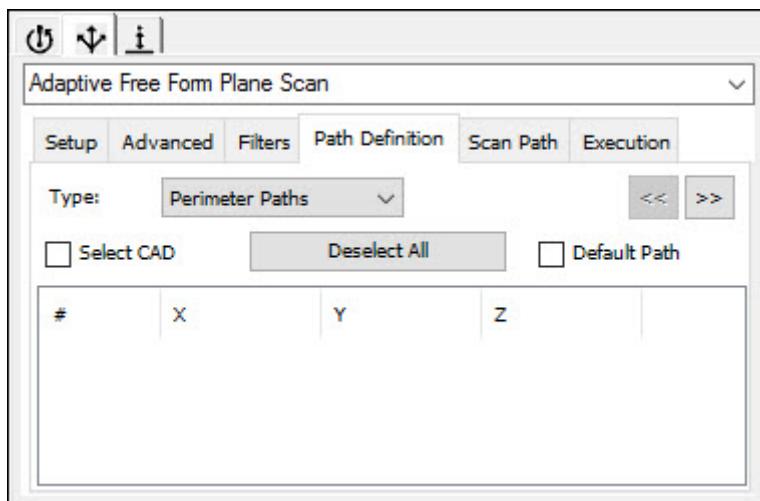
您可为给定平面生成默认周边扫描路径。默认路径的起点为离选择的平面的点（质心）最近的边缘。在给定平面中的扫描方向为逆时针。扫描的起点与终点相同。默认路径生成将使用路径生成定义的第二个屏幕中的参数集。选择创建后，扫描路径选项卡将用默认路径填满。

选择平面的多个曲面

周边路径支持分离的平面。例如，以下为演示块上的正面。



演示块上的正面示例



“路径定义”选项卡

若要选择平面的多个曲面：

1. 选中**选择 CAD** 复选框。
2. 如需，单击**全部取消选择**，取消选择所有所选的曲面。
3. 单击第一个曲面。该曲面将突出显示。
4. 单击第二个曲面。该曲面将突出显示。

如果第一个曲面与第二个曲面分离，则 PC-DMIS

将自动选择**默认路径**复选框。将在每个所选的曲面上生成默认路径。

5. 单击曲面，选择更多曲面。

选择创建后，PC-DMIS 将填写**扫描路径**选项卡。

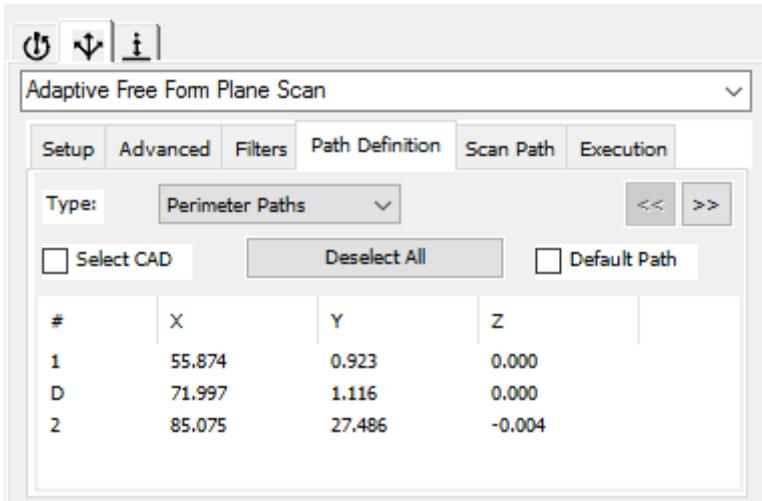
选中以生成周边路径

选中任一 CAD

曲面上的起点、方向和终点，可生成周边路径。要生成扫描路径，请使用此方法：

1. 单击 CAD

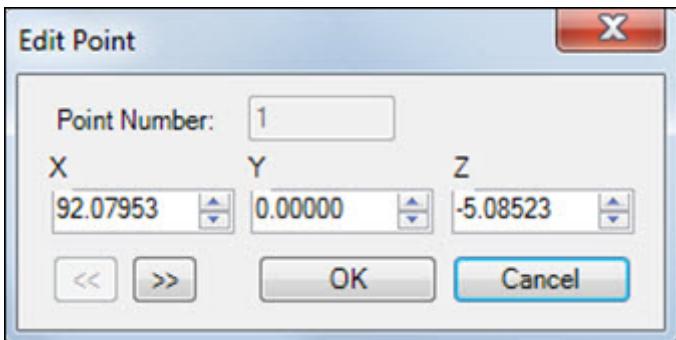
上的三个点，定义起点、方向点和终点。这些点将显示在点列表区域中。例如：



“路径定义”选项卡示例

栏列出识别 点的数字或字母 : 1 = 起点, D = 方向点, 2 = 终点。

如需, 双击 , 编辑点。屏幕上将出现编辑点对话框。例如 :

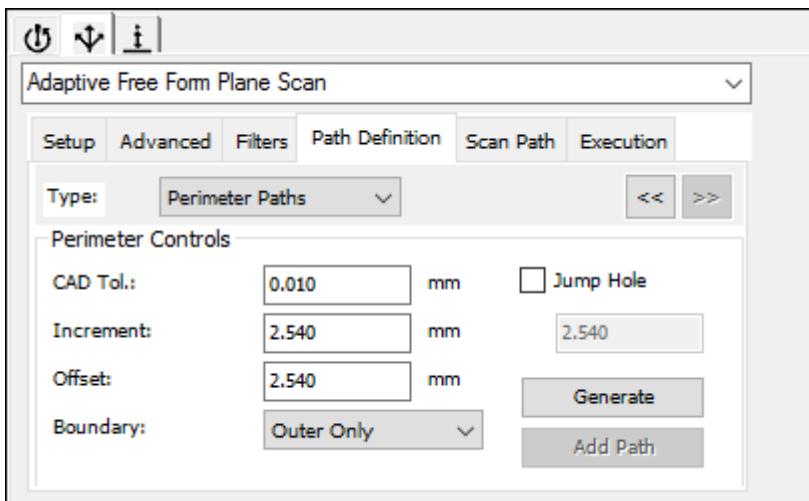


“编辑点”对话框

根据需要更改值。要浏览并修改点 , 单击 >>。

2. 要设置边界控制 , 请单击

>>。屏幕上将出现边界控制区域。使用此区域中的属性可控制边界点的生成。



边界控制区域示例

CAD 公差 - 键入点定位算法所用的公差。

增量 - 键入相邻点的最小间距。

偏置 - 键入离界限的偏置距离。

界限类型 - 计算路径时，应选择选定曲面上所显示的界限类型：

- 仅内部
- 内或外
- 仅外部

跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，若选择此复选框，即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

生成 - 要生成点并在点列表区域中显示这些点，请单击此按钮。PC-DMIS

将在“图形显示”窗口的 CAD

上显示生成的路径。您可以更改起点、方向点和终点，然后重新生成扫描路径（如需）。

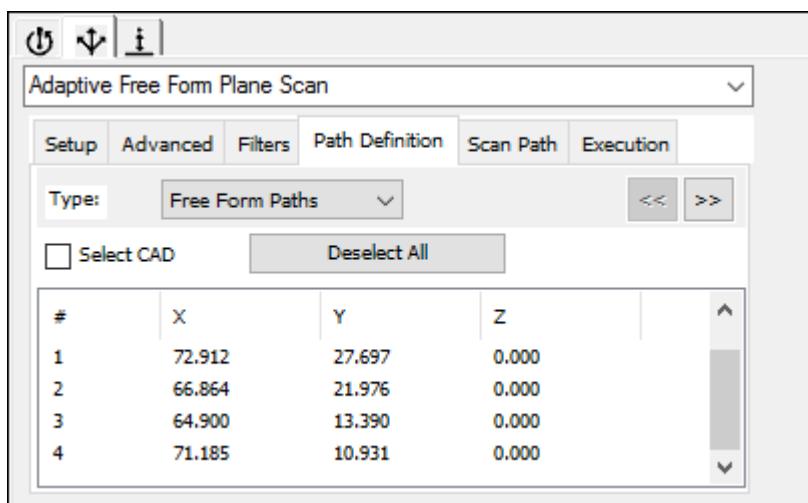
添加路径 - 要添加点至扫描路径选项卡，请单击此按钮。

自由形状路径

使用此方法可生成沿定义的点路径的扫描路径。此步骤需要使用 CAD。要生成扫描路径，请使用此方法：

1. 单击

CAD，定义自由形状路径。必须至少记录五个点，以计算扫描路径。这些点将显示在点列表区域中。例如：



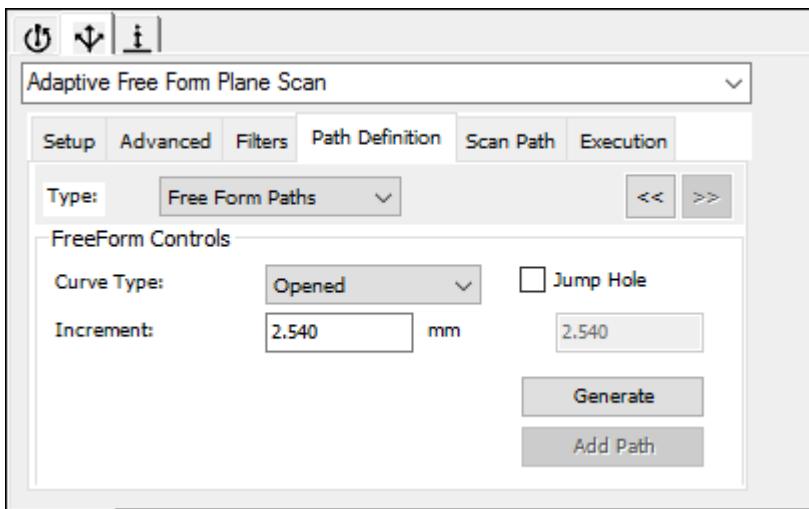
“路径定义”选项卡示例

#

栏列出识别点的数字。要编辑点，双击该点。屏幕上将显示编辑点对话框。根据需要更改值。要浏览并修改点，单击 >>。

2. 要设置自由形状路径控制，请单击

>>。屏幕上将出现**自由形状控制**区域。使用此区域中的属性可控制自由形状点的生成：



自由形状控制区域示例

曲线类型 – 选择要生成的路径类型：开线或闭线。

增量 - 键入相邻点的最小间距。

跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，若选择此复选框，即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

生成 -

要生成点并在点列表区域中显示这些点，请单击此按钮。生成的路径将显示在“图形显示”窗口中的 CAD

上。您可以更改定义自由形状路径的点，然后重新生成扫描路径（如需）。

添加路径 - 要添加点至扫描路径选项卡，请单击此按钮。

自学习路径

通过在 CMM 或 CAD

上采集测点以示教或学习路径，可生成此类扫描路径。该扫描路径由线、弧和/或圆组成。



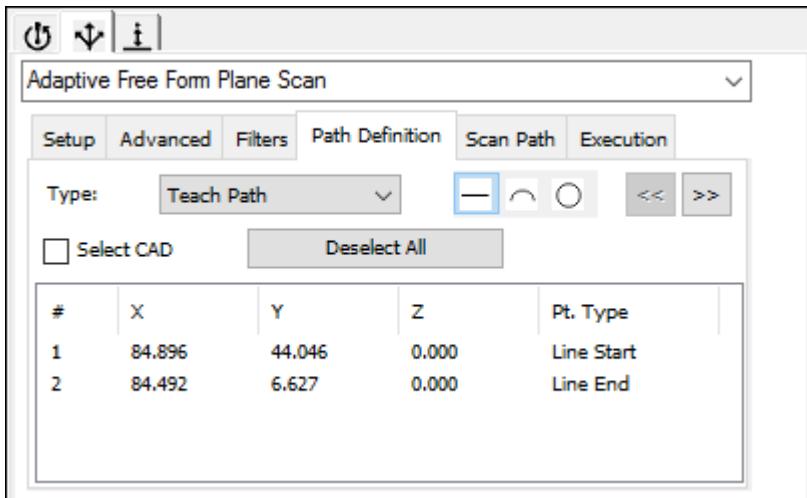
有关示教路径的生成帮助，请参考沿特定路径扫描上曲面的“自适应自由形状平面扫描策略的示教路径示例”主题中的详细程序示例。

要定义示教路径：

1. 为路径类型选择按钮：

- 线
- 弧
- 圆

2. 对于线路径，采集一个或两个手动测点。对于弧路径或圆路径，采集两个或三个手动测点。这些点将显示在点列表区域中。例如：



“路径定义”选项卡 - 线路径示例

以下项目适用于点列表区域：

- **#**

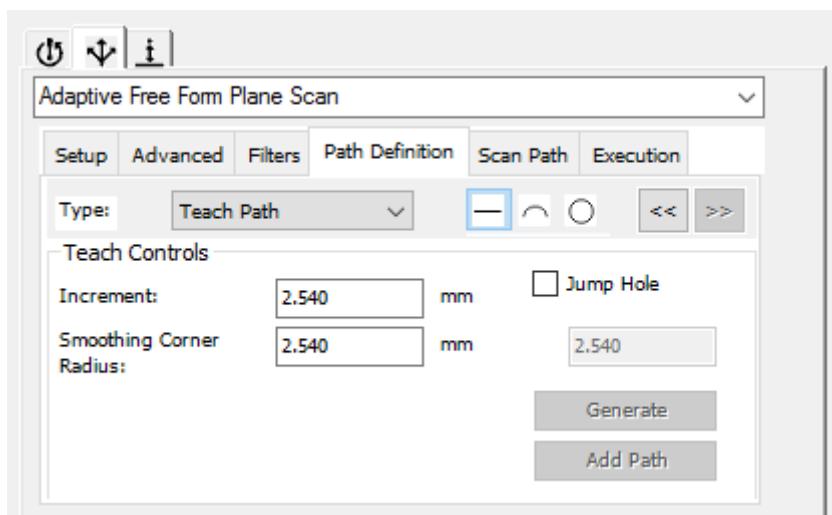
栏列出识别点的数字。点类型栏描述点的类型；例如：起始线、终止线、终止圆或圆中点<数字>。

- 红点表示路径未完成，点将不会被用于生成路径。若更改路径类型（例如，从线更改为弧），则红点将被删除。
- 要编辑点的 X、Y 和 Z 值，请双击该点。屏幕上将显示**编辑点**对话框。

要编辑圆路径的起点或终点，这两个点都将更改，因为它们是同一个点。

3. 要设置示教控制，请单击

>>。屏幕上将出现**示教控制区域**。使用此区域中的属性可控制点的生成：



示教控制区域示例

增量 - 键入相邻点的最小间距。

跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，选择后，此复选框即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

平滑棱角半径 - PC-DMIS

生成扫描路径后，交点处将有锐角。锐角可令控制器放慢扫描速度。平滑棱角半径将有助于消除锐角。如在此框中输入的交点和半径一样，带中心的圆将被定义。将消除此圆内扫描路径中的所有点。

生成 -

要生成点并在点列表区域中显示这些点，请单击此按钮。生成的路径将显示在“图形

显示”窗口中的 CAD

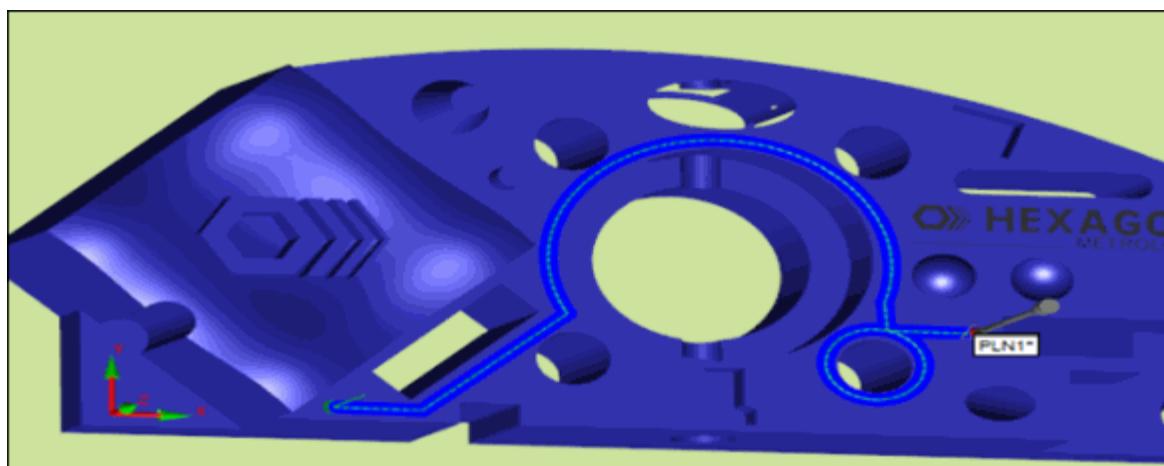
上。您可以更改定义示教路径的点，然后重新生成扫描路径（如需）。

添加路径 - 要添加点至扫描路径选项卡，请单击此按钮。

示教路径示例 - 自适应自由形状平面扫描策略

自适应自由形状平面扫描策略的示教路径方法示例显示沿特定路径扫描上曲面的详细程序。

在本例中，假定您要沿以下所示的路径扫描上曲面：

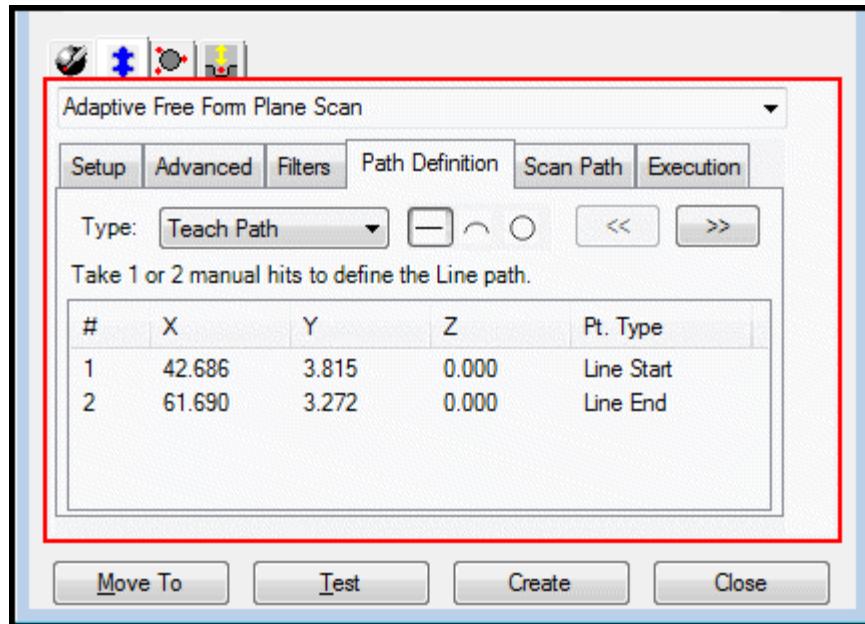


扫描路径

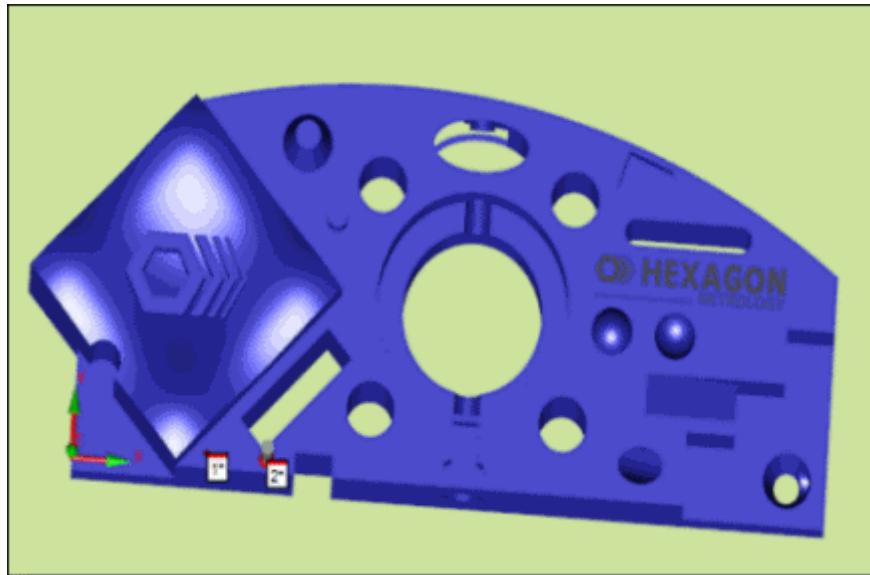
要生成此路径，采集测点，如下所述定义点。这些点记录在**路径定义**选项卡上点列表区域中。这些点在程序中所示的 CAD 上标记出来。

1. 路径中的第一段为线性。要生成此线：

- a. 选择 按钮。
- b. 由于这是第一段，采集两个测点，定义线的点 1 和 2。



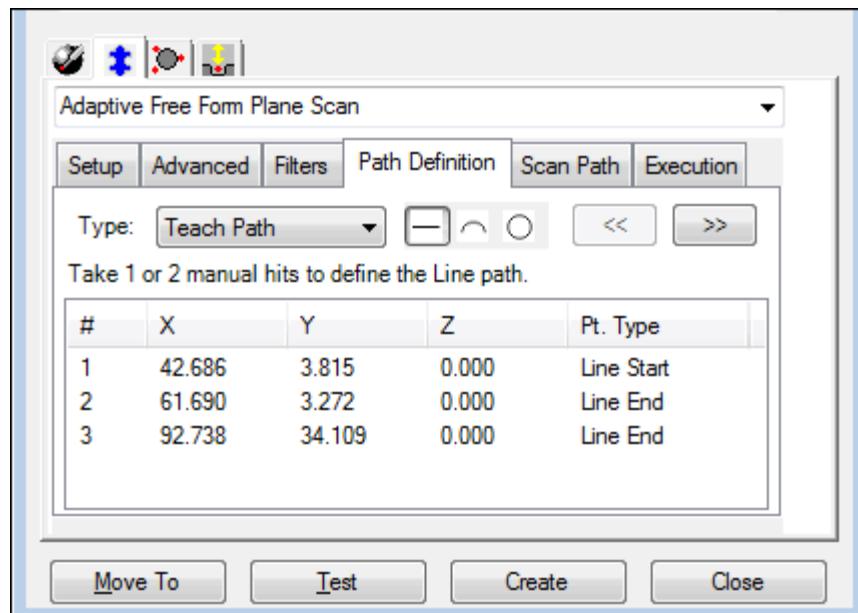
第一段中的点 1 和 2



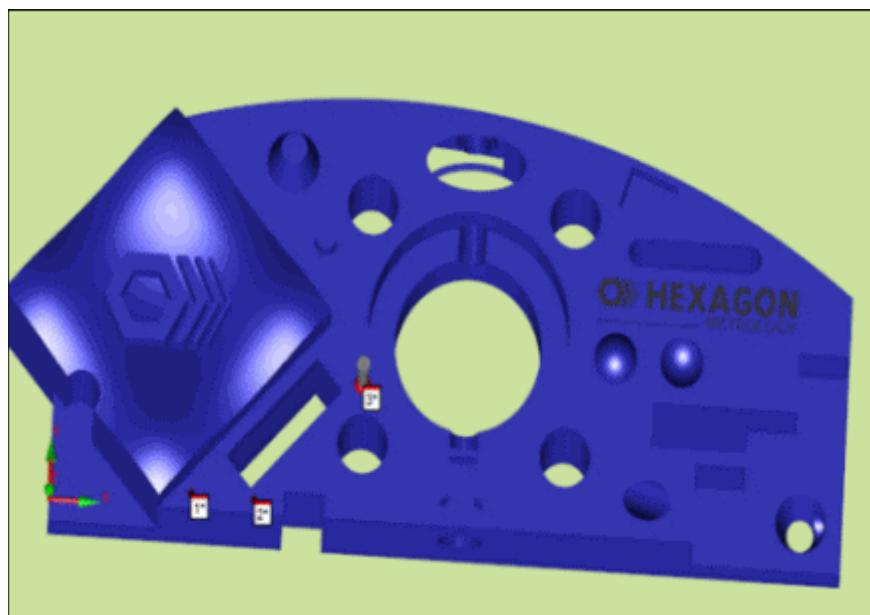
在 CAD 上标记的点 1 和 2

2. 路径中的第二段也为线性。点

- 2 (第一段线的最后一个点) 将是第二段线的起点。要生成此线：
- 保持选择 按钮。
 - 采集一个测点，定义点 3 (第二段线的终点)。



第二段中的点 3

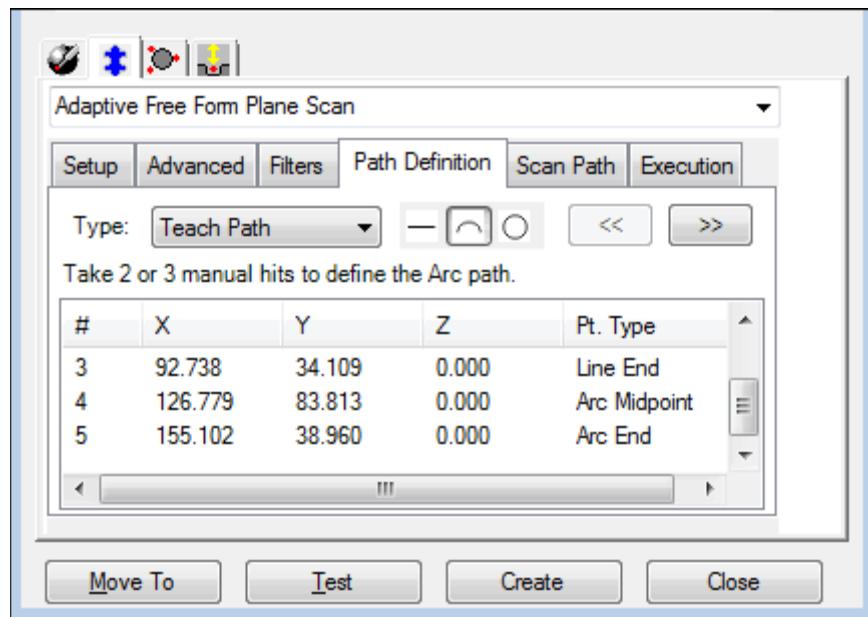


在 CAD 上标记的点 3

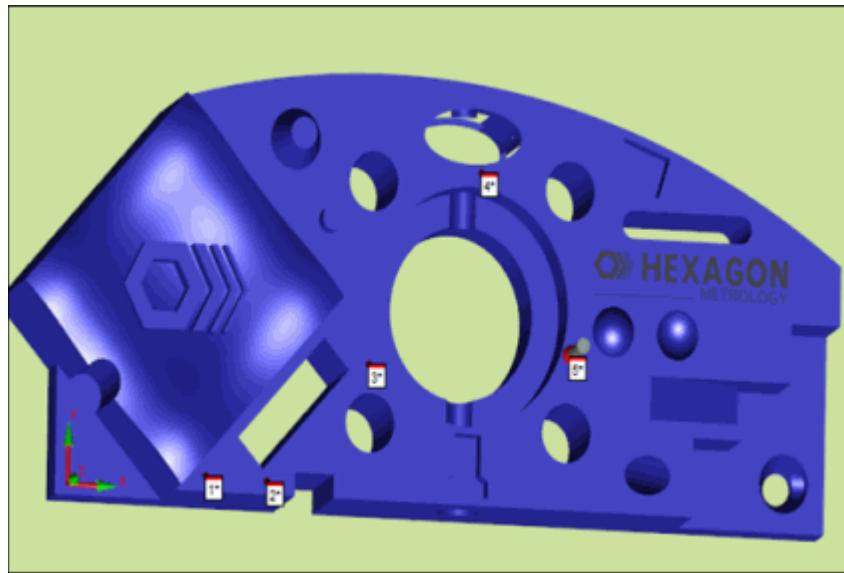
3. 扫描路径中的第三段是沿大圆的弧。点

3 (第二段线的最后一个点) 将是弧的起点。最后一个点将是弧的终点。要生成此弧：

- 选择 按钮。
- 在弧上再采集两个测点，定义点 4 和 5。

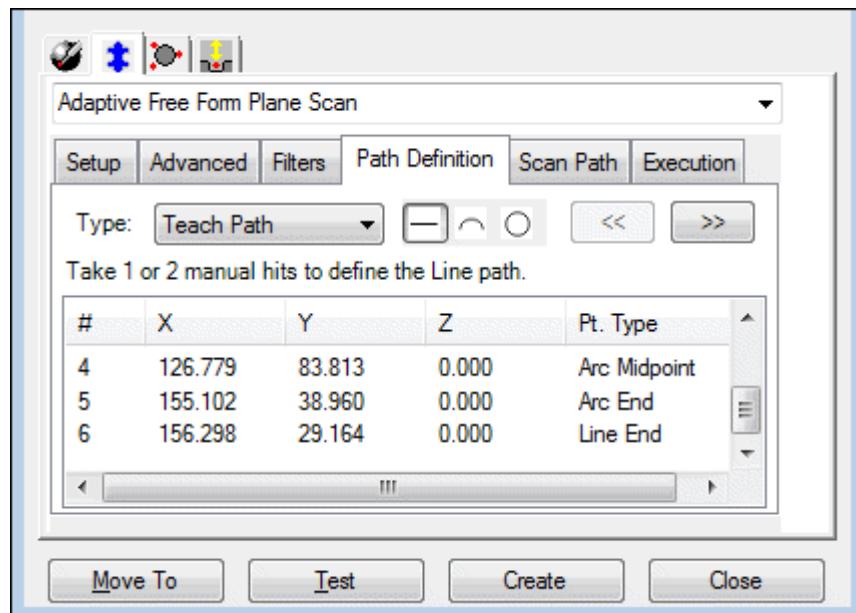


第三段中的点 4 和 5

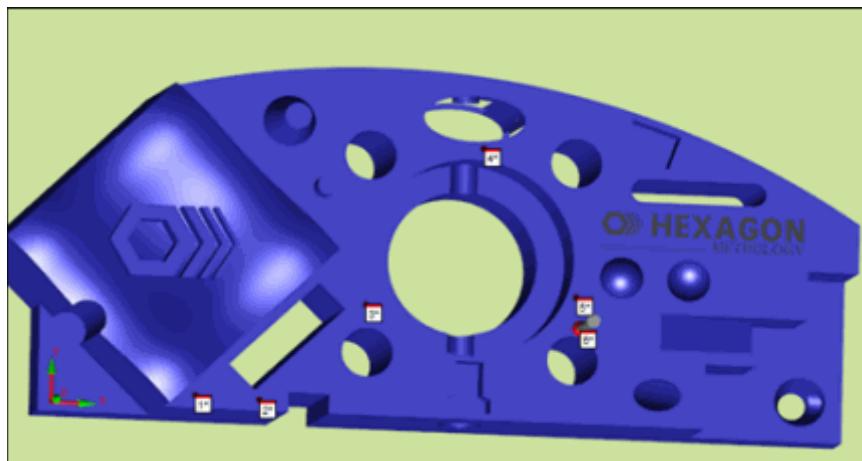


在 CAD 上标记的点 4 和 5

4. 第四段为一条直线。弧的终点将成为线的起点。要生成此线：
 - a. 选择 按钮。
 - b. 采集一个测点，定义点 6（第四段线的终点）。

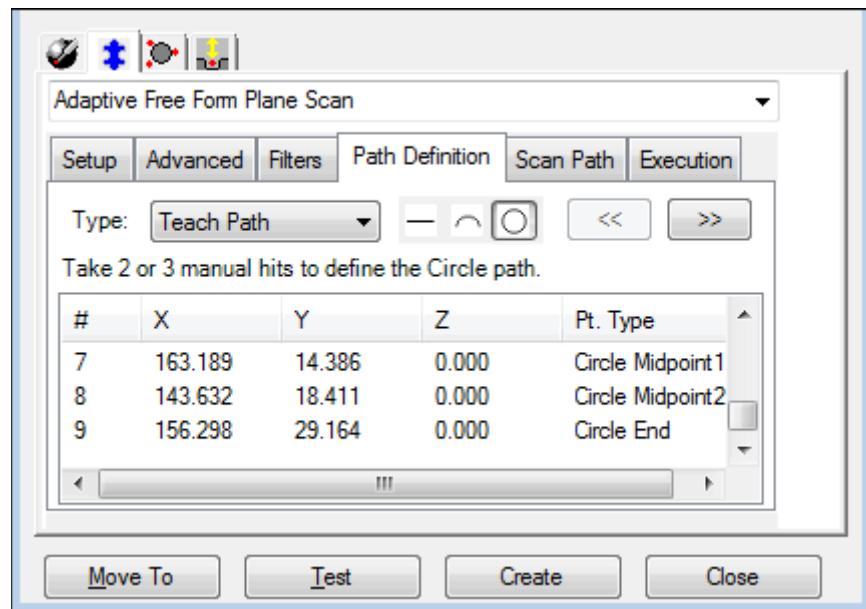


第四段中的点 6

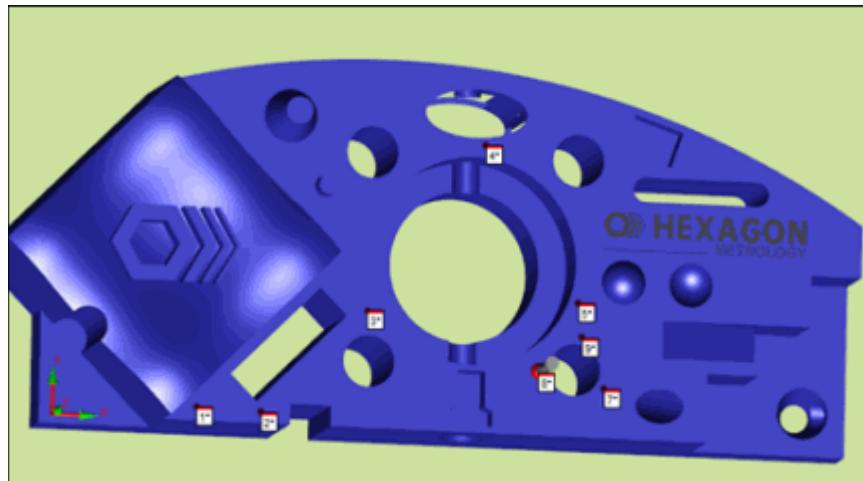


在 CAD 上标记的点 6

5. 现在您需沿小圆扫描 360 度。第四段线的终点将成为圆的起点。要生成此圆：
 - a. 选择 按钮。
 - b. 再采集两个测点，为圆形路径定义点 7 和 8。由于圆是 360 度，点 9（圆的终点）将被自动记录，与圆的起点相同。

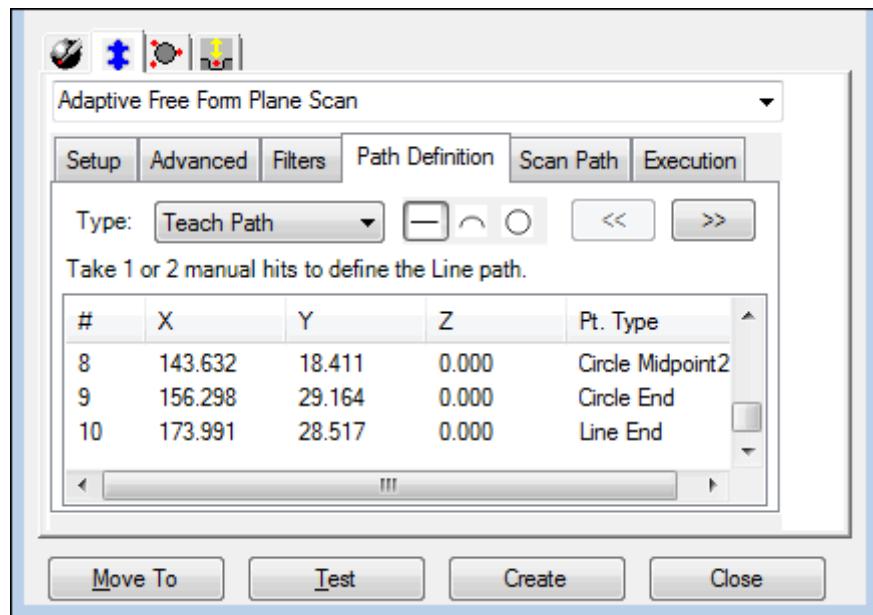


圆中的点 7 至 9

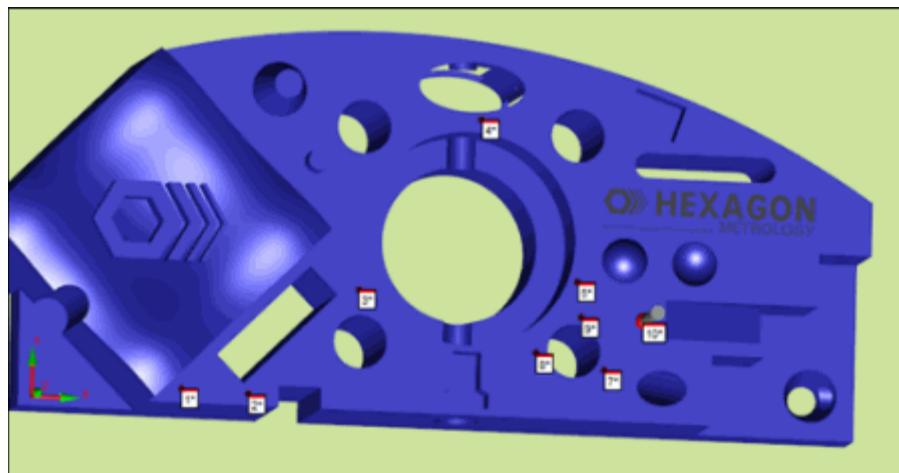


在 CAD 上标记的点 7 至 9

6. 最后一段是一条直线。点 9 (圆的终点) 将成为线的起点。要生成此线：
 - a. 选择 按钮。
 - b. 采集最后一个测点，定义点 10，然后可完成扫描路径。

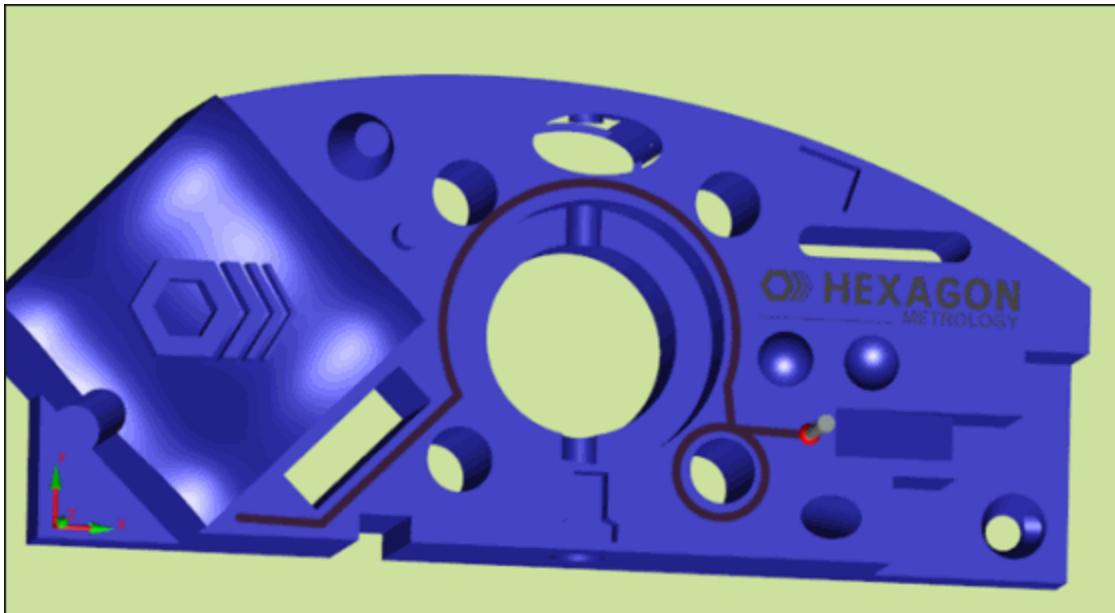


最后一段中的点 10



在 CAD 上标记的点 10

7. 选择 **>>** 按钮。在**示教控件**区域的**增量**框中，输入 1。
8. 单击**生成**。生成的扫描路径显示在“图形显示”窗口中。



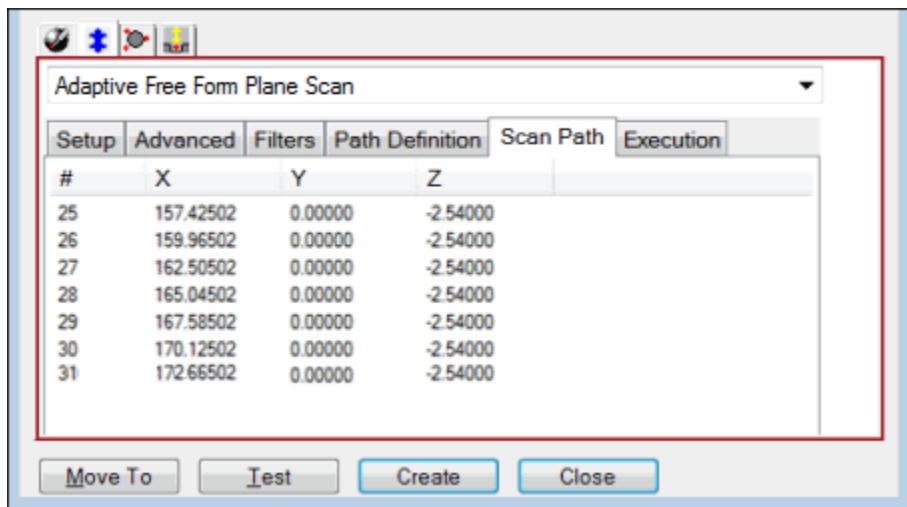
生成的扫描路径

“扫描路径”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略

使用自适应自由形状平面扫描策略的扫描路径选项卡执行以下操作：

- 显示扫描点并移动点
- 导入扫描点并从文本文件中移动点
- 导出扫描点并将点移动至文本文件
- 插入移动点或断点

以下为示例：

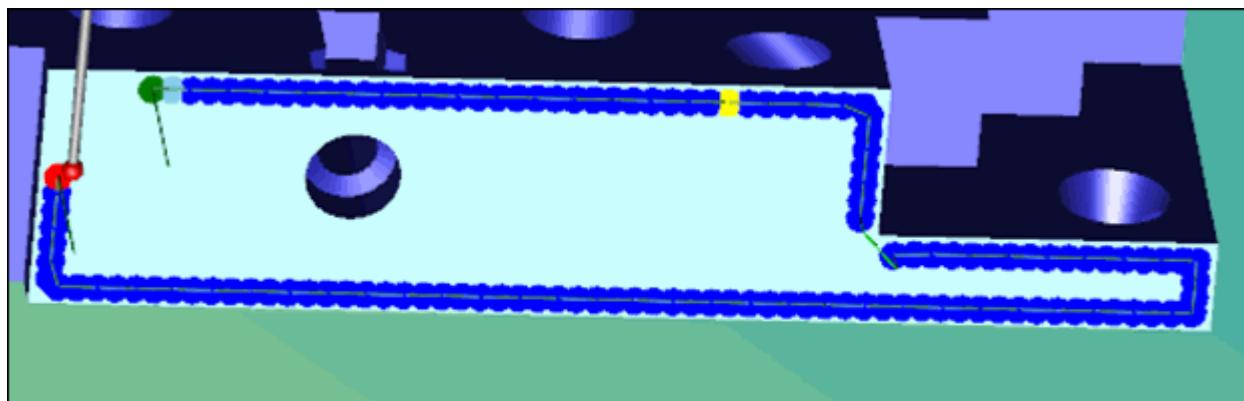


“扫描路径”选项卡示例

以下项目将出现在点列表区域中：

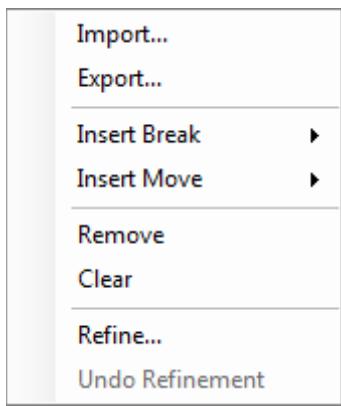
- # - 识别生成的点的数字
- X、Y 和 Z - XYZ 值

单击扫描路径中的任一点时，PC-DMIS 将在 CAD 曲面上突出显示该点。例如：



CAD 曲面上突出显示的点的示例

要执行其他功能，右击点列表区域。屏幕上将出现以下选项：



点列表选项

导入

要导入扫描点并从文本文件中移动点，请选择此选项。运行测量程序时，可从文本文件中动态读取扫描路径。此功能有助于扫描零件变体上的平面，在该平面上所扫描的平面形状在变体间发生变化。

部分文本文件示例如下所示：

```
-32.23,14.067,-0.001,SCAN  
-29.2,6.684,-0.006,SCAN  
-24.389,1.846,-0.008,SCAN  
-19.309,-3.982,-0.004,SCAN  
-15.327,-8.125,-0.004,SCAN  
-9.949,-9.576,-0.004,SCAN  
-4.838,-11.112,-0.001,SCAN  
6.786,-10.431,-0.005,SCAN  
12.121,-4.769,-0.003,SCAN  
17.941,1.332,-0.005,SCAN  
21.889,7.432,-0.002,SCAN  
26.623,10.02,-0.004,SCAN  
0,0,0,BREAK  
27,10,50,MOVE  
30.361,9.192,-0.003,SCAN
```

在本例中：

- SCAN - 表示将添加到扫描中的点。
- BREAK - 表示移至“回退”，然后另一个扫描将在下一个 SCAN 点处开始。
- MOVE - 表示移至指定位置。

导出

要导出扫描路径至文本文件，请选择此选项。

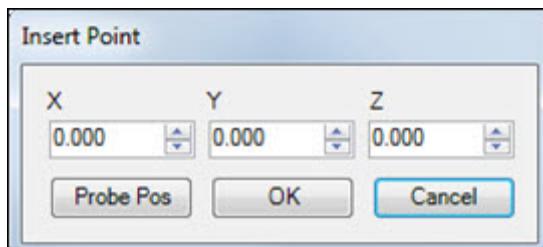
插入断点

要在扫描点间插入断点，请选择此选项。由此，PC-DMIS 将发送多个扫描命令至控制器。扫描路径中的断点有助于将面作为一个平面进行扫描，即使由于任何原因路径不是连续的。扫描将执行以下操作：

1. 根据当前回退参数值回退零件。
2. 根据当前预碰参数值以预碰距离移至下一个扫描点。
3. 开始下一个扫描。

插入移动点

要插入移动点以避免障碍，请选择此选项。扫描路径中的移动点有助于将面作为一个平面进行扫描，即使由于任何原因路径不是连续的。屏幕上将出现**插入点**对话框：



“插入点”对话框

您可定位测头，然后单击测头位置，在该位置插入移动点。

移除

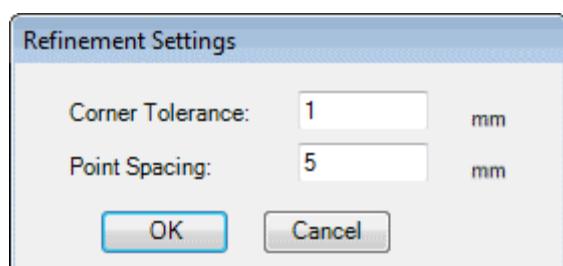
要删除一个点，在点列表区域中突出显示该点并右击该点，然后选择此选项。

清除

要删除所有点，右击点列表区域，然后选择此选项。当出现“删除所有点？”消息时，单击**确定**。

优化

要根据路径曲度更改路径的点密度，则选择此选项显示**优化设置对话框**：



优化设置对话框

转角公差 - 曲度小于在此框中键入的值的路径区域将被转换为弧段。

点间距 - 键入路径线性部分相邻点的最大间距。

取消优化

要撤销在优化设置对话框中做出的更改，请选择此选项。

“执行”选项卡 - 自适应自由形状平面扫描策略

使用**自适应自由形状平面扫描策略的执行**选项卡来设置此策略的其他选项。

执行前读取文件

要从文本文件执行前读取扫描路径，请选择此复选框。这样做有助于测量零件变体。

文件名称

键入执行前要读取的文件路径和名称。要选择文件，单击浏览。

逼近/回退距离

为每个扫描段键入预碰和回退移动距离。值为 0.0 时，禁用这些移动。

触测周期

此属性仅适用于 B3 控制器（非 VHSS 扫描）。该属性控制路径点间的毫秒数。

自适应平面圆扫描策略

平面自动特征的自适应平面圆扫描策略通过在圆形路径上进行扫描来测量平面。

策略的选项卡位于自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）中的测头工具箱中：

- **设置**选项卡
- **筛选器**选项卡
- **高级**选项卡
- **路径定义**选项卡
- **扫描路径**选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应平面圆扫描策略

使用自适应平面圆扫描策略的设置选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择允许限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

选择中心

通过此选项可单击 CAD 指出中心点。您可选择曲面点或线框点。PC-DMIS 会使用选择点的信息填写**自动特征对话框**（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）中的**特征属性区域**。它也可填写**路径定义**选项卡上的**第一个直径框**。

“高级”选项卡 - 自适应平面圆扫描策略

使用自适应平面圆扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度**、**扫描速度**、**加速度**和**偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

“筛选器”选项卡 - 自适应平面圆扫描策略

使用自适应平面圆扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

离群值

PC-DMIS

首先将圆拟合至数据，然后根据标准偏差倍数确定哪些点是离群值。然后执行以下操作：

- 应用那些已被剔除的局外点来重新计算出最佳拟合圆特征。
- 再次复检局外点
- 重新计算出最佳拟合圆特征。
- 继续重复此过程，直到离群值不再存在或直到 PC-DMIS 无法计算圆。(若少于三个数据点，则 PC-DMIS 无法计算圆。)

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** – 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

波长(毫米)

应用线性高斯筛选器时，小于您在列表中所选的值的数据中的振荡会更平顺。这一点适用于直线和平面。



您也可在方框中键入波长值。该值的单位为毫米。

若在筛选器列表中选择**无**，则此选项会被隐藏。

“路径定义”选项卡 - 自适应平面圆扫描策略

使用自适应平面圆扫描策略的**路径定义**选项卡可定义圆形扫描路径的一些额外选项。只要更新路径定义参数，即可查看扫描路径。您也可查看“图形显示”窗口中**更新的**扫描路径。

环

键入或选择环数。

第一个直径

键入第一个环的直径。

偏置

键入第一个环的直径。

跳过环

键入要跳过的环数。



要跳过环 2 和 4，键入 **2,4**。要跳过环 2 至 5，键入 **2-5**。

路径密度

键入将生成用于创建扫描路径的每毫米点数。

起始角度

键入或选择起始角度（单位：度）。

终止角度

键入或选择终止角度（单位：度）。

方向

选择 **CW**（顺时针）或 **CCW**（逆时针）。

跳过孔

只要扫描路径位于 CAD

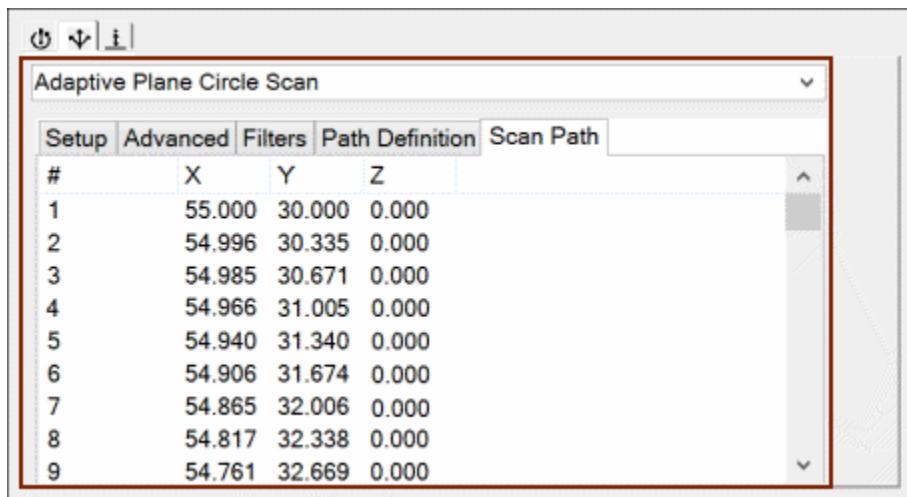
曲面的孔之上，若选择此复选框，即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

“扫描路径”选项卡 - 自适应平面圆扫描策略

使用自适应平面圆扫描策略的扫描路径选项卡执行以下操作：

- 显示扫描点并移动点
- 插入移动点或断点
- 从扫描路径删除点

以下为示例：

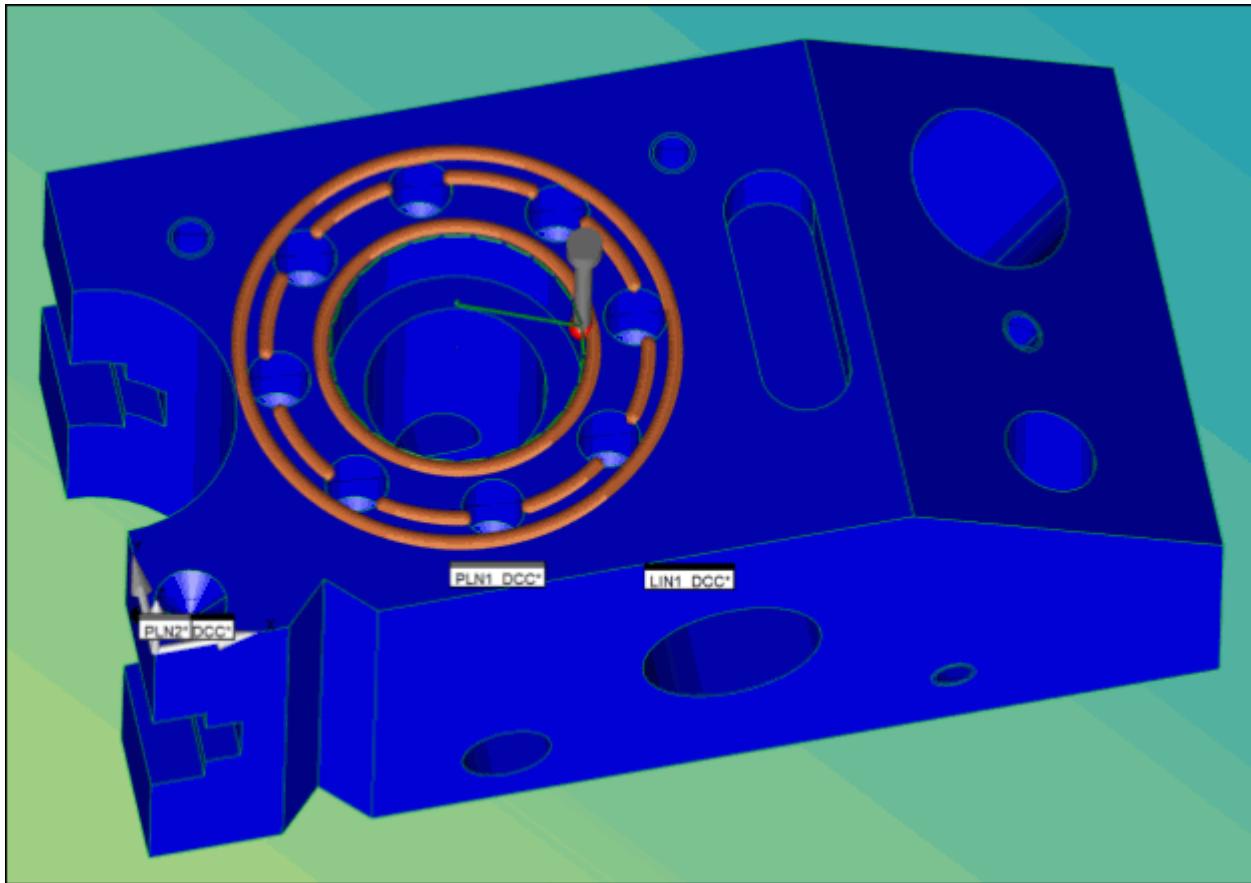


“扫描路径”选项卡示例

以下项目将出现在点列表区域中：

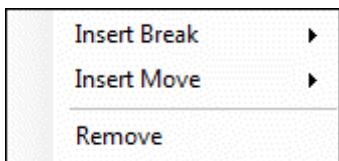
- # - 识别生成的点的数字
- X、Y 和 Z - XYZ 值

单击扫描路径中的任一点时，该点将突出显示在 CAD 曲面上。例如：



CAD 曲面上突出显示的点的示例

要执行其他功能，右击点列表区域。屏幕上将出现以下选项：



点列表选项

插入断点

要在扫描点间插入断点，请选择此选项。由此，PC-DMIS

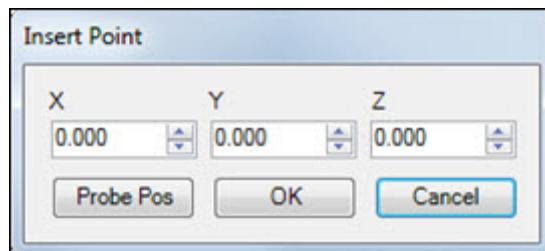
将发送多个扫描命令至控制器。扫描路径中的断点有助于进行扫描，即使由于任何原因路径不是连续的。扫描将执行以下操作：

1. 根据当前回退参数值回退零件。

2. 根据当前预碰参数值以预碰距离移至下一个扫描点。
3. 开始下一个扫描。

插入移动点

要插入移动点以避免障碍，请选择此选项。扫描路径中的移动点有助于避免扫描路径中的障碍物。屏幕上将出现**插入点**对话框：



“插入点”对话框

您可定位测头，然后单击测头位置，在该位置插入移动点。

移除

要删除一个点，在点列表区域中突出显示该点并右击该点，然后选择此选项。

自适应平面线扫描策略

平面自动特征的自适应平面线扫描策略通过沿直线进行扫描来测量平面。

策略的选项卡位于自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）中的测头工具箱中：

- 设置选项卡
- 筛选器选项卡
- 高级选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - 自适应平面线扫描策略

使用自适应平面线扫描策略的设置选项卡可了解有关特征公差要求和曲面类型的所有已知信息，PC-DMIS 将执行剩余操作。

形状

如果测量的目的是形状公差，则选择此复选框。若选择此复选框，PC-DMIS 会根据所输入的**形状公差值**扫描特征。**形状公差值**越大，扫描速度越快。**形状公差值**越小，扫描速度越慢。

公差

键入或选择允许限制或变量限制。

曲面类型

选择抛光面、机械加工面、磨光面或铸造面。

“高级”选项卡 - 自适应平面线扫描策略

使用自适应平面线扫描策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何自动配置的参数。

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何自动配置的参数。还将启用**点密度**、**扫描速度**、**加速度**和**偏置力**属性，使用这些属性可更改此测量的扫描特性。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

“筛选器”选项卡 - 自适应平面线扫描策略

使用自适应平面线扫描策略的筛选器选项卡设置筛选器。

离群值

PC-DMIS

首先将圆拟合至数据，然后根据标准偏差倍数确定哪些点是离群值。然后执行以下操作：

- 应用那些已被剔除的局外点来重新计算出最佳拟合圆特征。
- 再次复检局外点
- 重新计算出最佳拟合圆特征。
- 继续重复此过程，直到离群值不再存在或直到 PC-DMIS 无法计算圆。(若少于三个数据点，则 PC-DMIS 无法计算圆。)

筛选器

该值表示扫描的筛选器类型。某些筛选选项是特定策略的特定选项。选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** - 对扫描数据集应用高斯筛选器，使数据平顺。

波长(毫米)

应用线性高斯筛选器时，小于您在列表中所选的值的数据中的振荡会更平顺。这一点适用于直线和平面。



您也可在方框中键入波长值。该值的单位为毫米。

若在筛选器列表中选择**无**，则此选项会被隐藏。

使用非自适应扫描策略

非自适应扫描策略及其选项卡位于测头工具箱中的**测量策略**选项卡中：这些策略包括：

- 量规扫描校准策略
- 圆柱定心螺纹扫描
- 自定心点策略

有关选择和使用测量策略的完整信息，请参见“**使用测量策略**”。

量规扫描校准策略

通过将校对环规或类似尺寸的塞上的扫描与位于 CMM

上同一位置的扫描进行对比，计量扫描筛选器可用于以最高精度测量圆和圆柱的形状。您可使用此筛选器测量生产环和生产塞以及零件上形状公差非常小的圆形特征。

自动圆的量规扫描校准策略校准与量规扫描筛选器一起使用的测头测尖。计量扫描校准数据存储在测头文件中。自适应圆扫描和自适应圆柱同心圆扫描策略提供计量扫描筛选器。



若再次校准测头测尖，PC-DMIS

将检测量规扫描校准数据。将需要再次执行量规扫描校准。

每个测头测尖的**编辑测头数据**对话框（**插入 | 硬件定义 | 测头 | 编辑按钮**）中的**计量扫描筛选器**选项指示计量扫描校准数据是否可用。有关此选项的信息
· 请参见PC-DMIS 核心文档中的“**计量扫描筛选器**”主题。

为获得最佳结果：

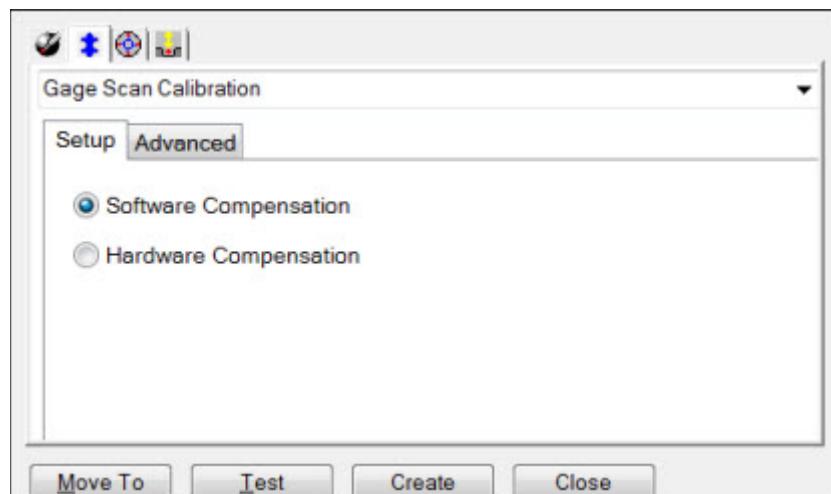
- 使用计量扫描校准来校准带环规的测头测尖，以准确测量内孔。
- 使用计量扫描校准来校准带塞规的测头测尖，以准确测量外孔。
- 使用计量扫描校准来校准使用环规或塞规（直径尽量接近需要准确检查的零件）的测头测尖。
- 为获得最高的精度，您需将环规或塞规放在 CMM 上与待检查的零件相同的位置。
- 如果对计量扫描校准使用**软件补偿**选项，您可以通过以下方法提高精度：定义特征的点密度（采样频率）来测量与计量校准中所用的点密度最接近的值。由于计量扫描筛选器在频率范围内应用，在计量的点密度与特征扫描的点密度之间实现更大的相似性将导致更有效的校正。

策略的选项卡位于自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 圆**）中的测头工具箱中：

- **设置**选项卡
- **高级**选项卡

“设置”选项卡 - 计量扫描校准策略

使用计量扫描校准策略的**设置**选项卡来选择计量扫描筛选器补偿类型：



“设置”选项卡示例

有关计量扫描筛选器的更多信息，请参见“[启用计量扫描筛选器](#)”。

软件补偿

各类控制器均有此类计量扫描筛选器。对于此类型：

- PC-DMIS
 - 会计算计量扫描筛选器参数，补偿测定的数据并提高圆形特征测量的精度。
- PC-DMIS 通过扫描校对环规或塞上定义的路径圆来执行软件校准。
- 扫描参数在运行时间使用自适应数据库确定。
- 圆必须扫描 360 度。

如果选择此类型，计量扫描筛选器通过与计量中相似的扫描数据对比校正测定的扫描数据。此项对比通过相同频率的计量振幅减少了测定的扫描数据中的频率振幅。此调整消除了测量机器和测头所固有的噪声特性。从而提供了更精确的零件测量。

如有必要，您可使用高级选项卡（类似于自适应扫描测量策略的高级选项卡）上的选项来修改扫描参数。

硬件补偿

仅 B5 及更高级别的 Leitz

控制器有此类计量扫描筛选器。它仅适应于一个测头文件中的一个测头测尖。对于此类型：

- 控制器通过扫描校对环规或塞来执行硬件校准。
- 控制器计算测定的数据，提高圆形特征测量的精度并补偿误差。
- 通过以 -90 度开始并以 +90 度结束（540 度扫描），以逆时针 (CCW) 方向扫描圆。起始和终止角度在本地坐标系中定义，无法更改。

结果

通过选择硬件补偿类型来执行计量扫描校准策略后，特征的测量值被设置为与其理论值相同的值。因此，如果标出计量扫描校准特征的尺寸，标称值和测量值将相同。

计量扫描校准策略将计量校准结果记录在测头文件（例如，MYPROBE.PRB）中。此策略将结果附加至结果文件（例如，MYPROBE.Results）。

以下为 .results 文件示例：

计量校准日期=2015/03/03 时间=01:06:59 PM

TIP1 硬件理论 X 770.039 Y 503.871 Z - 145.345 D 20.000

符合标准偏差：0.001

计量扫描校准始终将结果附加至结果文件。如果结果文件不存在，策略将创建该文件。策略会更新结果并在每次执行策略时将其附加至结果文件。

结果文件显示以下内容：

- 计量校准的**日期和时间**。
- 活动测尖的**ID**。
- 补偿方法（**软件或硬件**）。
- 测量机坐标系中环或塞中心位置的理论 (**THEO**) **X**、**Y** 和 **Z** 值。这些值表示在 CMM 工作台上放置环或塞用于校准的位置。
- 环或塞的标称直径 (**D**)。**内或外**表示是否使用了环或塞。
- 校准的标准偏差 (**StdDev**)。
- 校准的单位遵循用于校准测尖的测量程序的单位。



您可为一个内径和一个外径校准一个测尖。如果使用了不同的校准直径，原始数据将被覆盖。结果文件显示执行计量校准的历史，直至测头校准过程重新创建它。

启用计量扫描筛选器

计量扫描筛选器可为自适应圆扫描和自适应圆柱同心圆扫描自适应扫描测量策略提高圆形特征测量的精度。筛选器使用由计量扫描校准确定并存储在测头文件中的参数来校正所测量的扫描数据。测头测尖可使用内圆或外圆（或二者）进行校准。

要启用计量扫描筛选器：

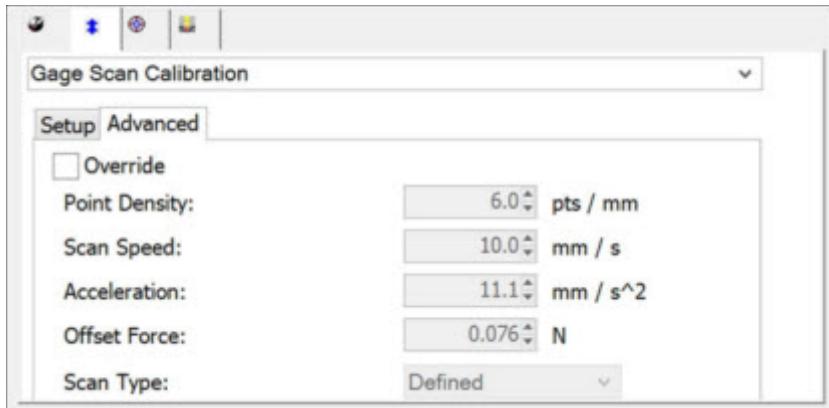
1. 从测头工具箱中选择测量策略选项卡 ()。
2. 为活动的测头测尖执行计量扫描校准。此步骤确定指定测尖的计量扫描参数。
3. 使用自适应圆扫描或自适应圆柱同心圆扫描策略来测量圆形特征。
4. 选择所选策略的筛选器选项卡。
5. 选择**使用计量扫描筛选器**复选框。圆的计算将使用计量扫描筛选器数据。



如果测头文件不包含活动测头测尖的任何校准数据，在测量过程中将出现错误。

“高级”选项卡 - 量规扫描校准策略

使用量规扫描校准策略的**高级**选项卡覆盖已计算的设置和任何 PC-DMIS 自动配置的参数。



“高级”选项卡示例

覆盖

若选择此复选框，将覆盖任何 PC-DMIS

自动配置的参数。还将启用**点密度、扫描速度、加速度和偏置力**选项。使用这些选项可更改此测量的扫描特性。

若选择设置选项卡上的**硬件补偿**选项，**覆盖**复选框将为默认选中状态。

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

加速度

键入或选择扫描过程中使用的加速度。此值的单位是毫米/秒。

偏置力

键入或选择扫描过程中要达到的偏置力水平。此值的单位为牛顿。

扫描类型

选择在控制器上执行的扫描类型：

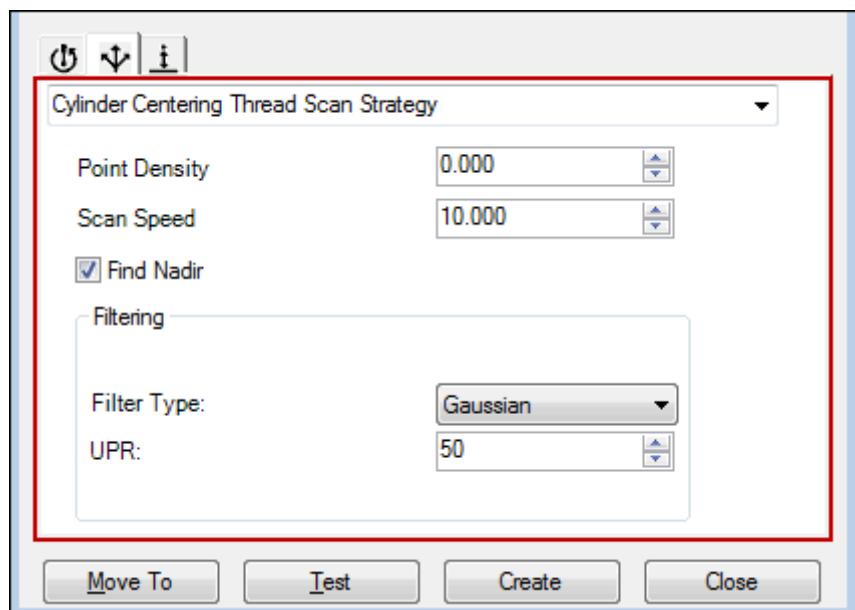
- **已定义** - 在 B3C、B4、B5 或 FDC 控制器上执行已定义的路径扫描。
- **CIR** - 在 B4 或 B5 Leitz 控制器上执行 CIR 型扫描。

圆柱定心螺纹扫描策略

圆柱自动特征的圆柱置中螺纹扫描策略通过将测头置中于螺纹中，执行螺纹扫描。使用此策略时，测头测尖的直径必须大于螺纹间凹处的尺寸，以防止测头晃动。

此策略仅在 B4 和 B5 Leitz 控制器上受支持。

以下属性可用：



圆柱置中螺纹扫描属性示例

点密度

键入或选择扫描过程中每测量单位的读取数。

扫描速度

键入或选择扫描速度（毫米/秒）。

查找最低点

若要在螺纹稍有不同的点上采集两个测点，确定开始扫描的最佳位置，请选择此复选框。所选的点位于螺纹最深处。

筛选区域

筛选器类型 - 选择筛选器类型：

- **无** - 对扫描数据集不应用任何筛选器类型。
- **高斯** - 对扫描数据集应用高斯圆柱筛选器。
- **圆柱** - 对扫描数据集应用圆柱筛选器。

UPR - 键入或选择每转波动。默认值是 50。UPR

仅适用于圆柱和圆。若在**筛选器类型**列表中选择**无**，则此属性会被隐藏。

自定心点策略

矢量自动特征的自定心点策略可测量零件上的自定心点。有两种类型的自定心点可用：

- **2D (2 轴)** - 以内部 V 形或内部弧中的自定心点作为示例。
- **3D (3 轴)** - 以内部圆锥、内部圆柱或内部球形部分中的自定心点作为示例。

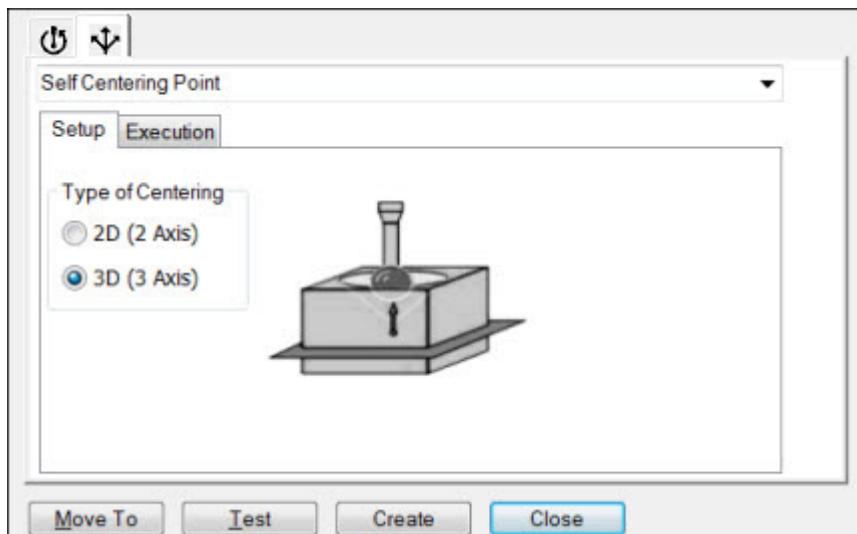
若要测量自定心点，请执行以下操作：

1. 打开矢量点（**插入 | 特征 | 自动 | 点 | 矢量**）的自动特征对话框。有关帮助，请参见“**插入自动特征**”。
2. 从测头工具箱中选择测量策略选项卡（）。
3. 从策略列表中，选择**自定心点**。

4. 在自动特征对话框的**点区域**中，输入标称 X、Y 和 Z 值。
5. 在自动特征对话框的**曲面区域**中，输入曲面矢量。
6. 完成选项卡上的属性：
 - 设置选项卡
 - 执行选项卡

设置选项卡 - 自定心点策略

使用自定心点策略的设置选项卡选择自定心点的类型：

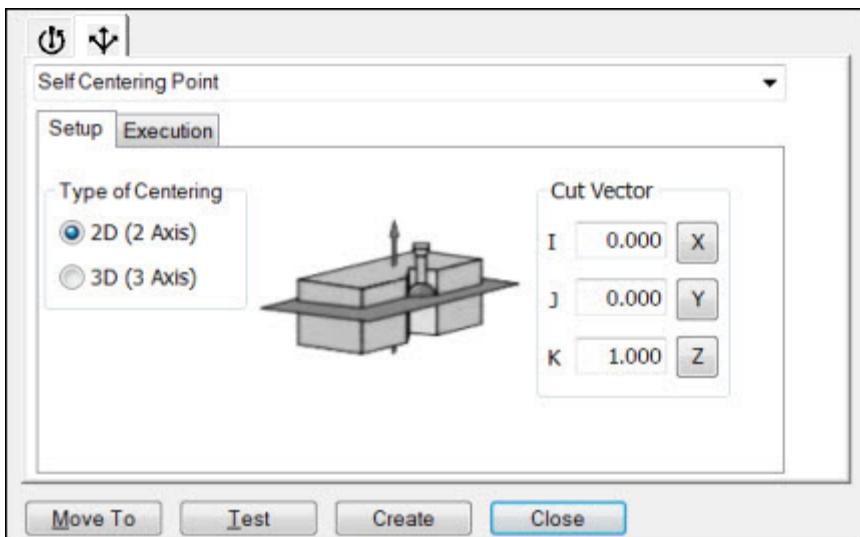


3D 类型设置选项卡示例

定心类型

选择定心类型：

- 2D (2 轴) - 若要测量 2D
自定心点，选择此选项并输入切矢量。切矢量是测量的点所在平面的矢量。例如：



2D 类型设置选项卡示例

- 3D (3 轴) - 若要测量 3D 自定心点，选择此选项。

使用曲面 CAD 模型创建 3D 自定心点

您可以从内部圆锥、内部圆柱或内部球体中创建 3D 自定心点。

1. 选择 **3D (3 轴)** 选项。状态栏中将出现“请选择用于 3D 自定心点的圆锥、球体或圆柱。”消息。
2. 单击内部圆锥、内部圆柱或内部球体。

自定心点取决于当前测尖的直径。

- 如果使用当前测点进行自定心是可行的，PC-DMIS 将计算一个自定心点，并使用该点完成矢量点**自动特征**对话框中的 **X**、**Y** 和 **Z** 方框。
- 如果使用当前测点进行自定心不可行，PC-DMIS 将计算内部圆锥、内部圆柱或内部球体的中心，并使用该点完成矢量点**自动特征**对话框。

使用曲面 CAD 模型创建 2D 自定心点

1. 选择 **2D (2 轴)** 选项。状态栏中将出现“请选择用于 2D 自定心点的第一个曲面上的一个点。”消息。
2. 确保用于 I、J 和 K 切矢量的值是正确的。
3. 单击第一个曲面。
4. 单击第二个曲面。

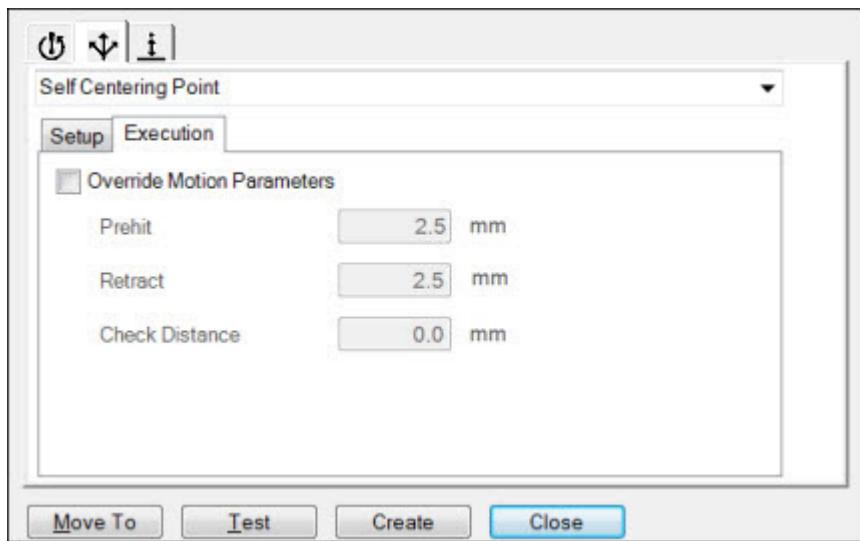
如果使用当前测点进行自定心是可行的，PC-DMIS 将计算一个自定心点，并使用该点完成矢量点**自动特征**对话框中的 X、Y 和 Z 方框。

若 PC-DMIS 不能定位自定心点，状态栏中将出现“2D 自定心计算失败”消息。

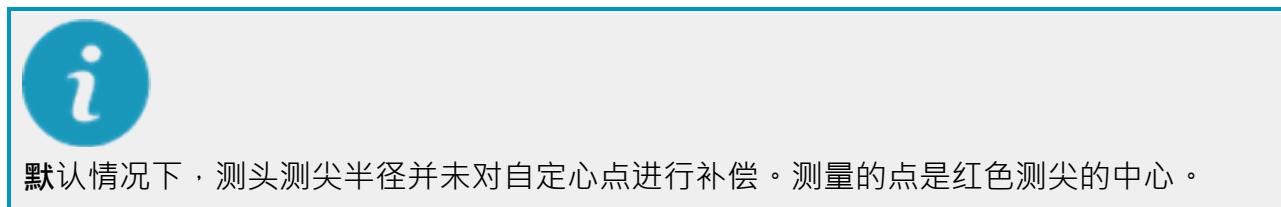
PC-DMIS 将采取第一个点作为矢量点，并创建一个垂直于该点的平面。类似地，PC-DMIS 将创建平行于第二个点的第二个平面。然后它尝试计算两个平面之间的自定心点。如果零件的几何形状不同，该结果将仅是一个近似值。您可以重写计算的值，并自己输入值。

执行选项卡 - 自定心点策略

使用自定心点策略的执行选项卡重写**参数设置**对话框（**编辑 | 首选项 | 参数**）中动作选项卡上指定的全局测量机动作值：



“执行”选项卡示例



重写动作参数

如果您希望使用不同于全局测量机动作值的动作值，选择该复选框。

逼近

输入到 PC-DMIS 开始搜索零件的曲面的理论测点位置的距离。有关完整信息，请参见 PC-DMIS 核心文档“设置首选项”一章中的“逼近距离”。

回退

输入测头采集测点后从曲面回退的距离。有关完整信息，请参见 PC-DMIS 核心文档“设置首选项”一章中的“回退距离”。

检查距离

输入测量机继续搜索或检查零件曲面时通过理论测点位置的距离。此距离发生在其穿过**逼近距离**值之后。有关完整信息，请参见 PC-DMIS 核心文档“设置首选项”一章中的“检查距离”。

使用 TTP 策略

TTP 策略及其选项卡位于测头工具箱中的测量策略选项卡上。测量策略如下：

- TTP 自由形状平面
- TTP 平面圆策略

当 PC-DMIS 处于手动模式或 DCC 模式时，TTP 策略可用。

有关选择和使用测量策略的完整信息，请参见“[使用测量策略](#)”。

TTP 自由形状平面策略

通过选择沿由一系列点定义的路径（扫描路径）的测点，平面自动特征的接触触发测头 (TTP) 自由形状平面策略可测量平面。

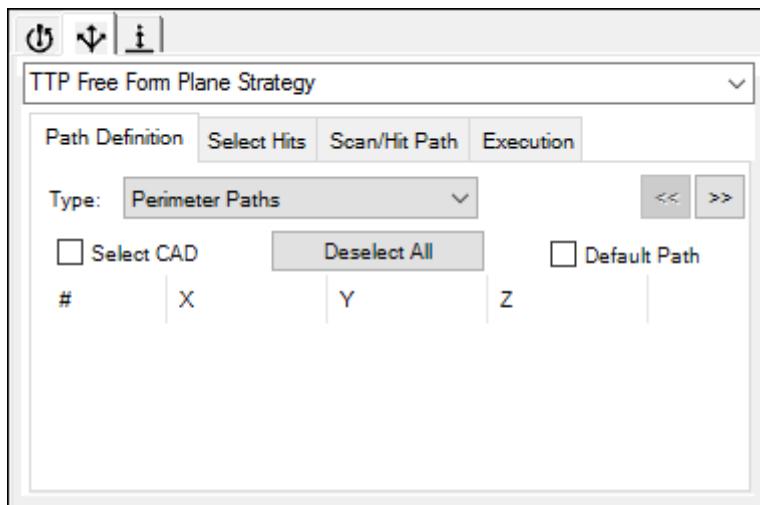
策略的选项卡位于自动特征对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）中的测头工具箱中：

- **路径定义** 选项卡
- **选择测点** 选项卡
- **扫描/测点路径** 选项卡
- **执行** 选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“[使用测量策略](#)”。

“路径定义”选项卡 - TTP 自由形状平面策略

使用 TTP 自由形状平面策略的**路径定义** 选项卡生成扫描路径/测点路径。



“路径定义”选项卡示例

扫描/测点路径方法显示在类型列表中：

- 边界路径
- 自由形状路径
- 示教路径
- 用户定义路径

可使用方法组合生成扫描/测点路径。

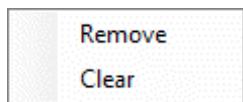
点列表区域

点列表区域显示在 CAD 上选择的点或在 CMM

上手动采集的点（仅适用于示教路径和用户定义路径类型）。

- # - 显示识别点的数字或字母。
- X、Y、Z - XYZ 值显示在此区域中。
- 点类型 - 表示生成扫描路径的示教路径方法的点类型。
- >> - 要为所选类型设置其他属性并生成扫描路径，请单击此按钮。
- << - 要返回点列表区域，请单击此按钮。

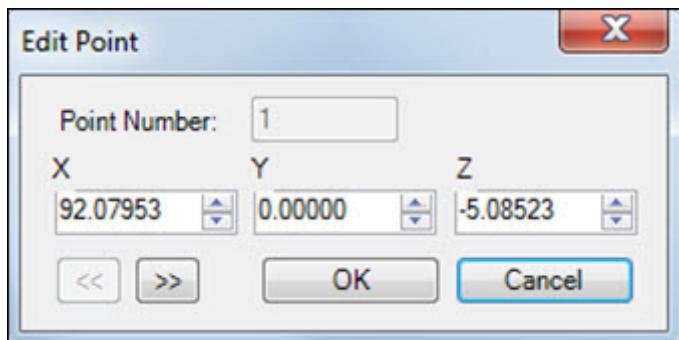
要删除一个或多个点，右击点列表区域。屏幕上将出现删除和清除选项：



要删除一个点，在点列表区域中突出显示该点并右击该点，然后选择**移除**。要删除所有点，右击点列表区域，然后选择**清除**；显示**移除所有点？消息**时，单击**确定**。

要编辑点的 X、Y 和 Z

值，请双击该点。屏幕上将出现**编辑点**对话框。要浏览并修改点，单击**>>**。例如：



“编辑点”对话框示例

边界路径方法

使用此方法可生成沿曲面边界的扫描路径。此步骤需要使用 CAD。当 PC-DMIS 处于 DCC 模式时，此路径生成方法为默认方法。

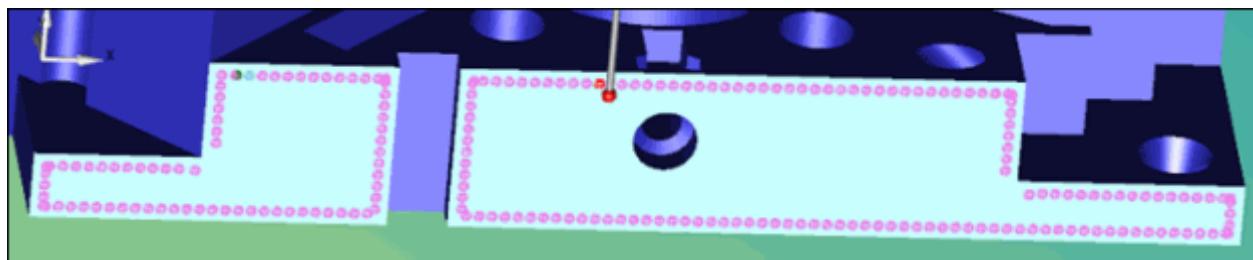
生成默认周边扫描路径

您可为给定平面生成默认周边扫描路径。默认路径的起点为离单击以选择平面的点最近的边缘。在给定平面中的扫描方向为逆时针。扫描的起点与终点相同。默认路径生成将使用定义路径生成的第二个屏幕上的参数集。选择**创建后**，**扫描/测点路径**选项卡显示默认路径。

如果选择默认路径，则无法修改任何其他参数。

选择平面的多个曲面

周边路径支持分离的平面。例如，以下为演示块上的正面。



演示块上的正面示例

若要选择平面的多个曲面：

1. 选中**选择 CAD** 复选框。
2. 如需，单击**全部取消选择**，取消选择所有所选的曲面。
3. 单击第一个曲面。该曲面将突出显示。
4. 单击第二个曲面。该曲面将突出显示。

如果第一个曲面与第二个曲面分离，则 PC-DMIS
将自动选择**默认路径**复选框。将在每个所选的曲面上生成默认路径。

5. 单击曲面，选择更多曲面。

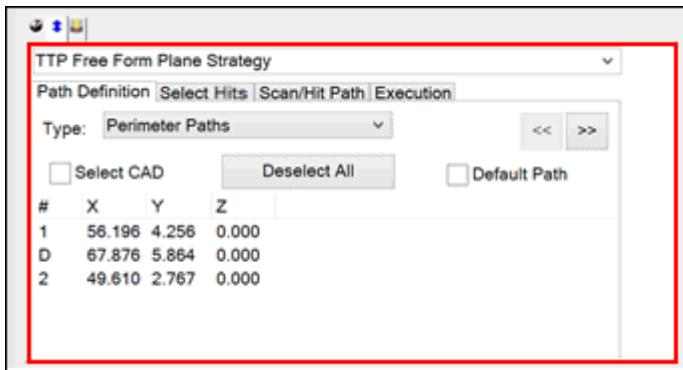
选择创建后，PC-DMIS 将填写扫描/测点路径选项卡。

选中以生成周边路径

选中任一 CAD

曲面上的起点、方向和终点，可生成周边路径。要生成扫描路径，请使用此方法：

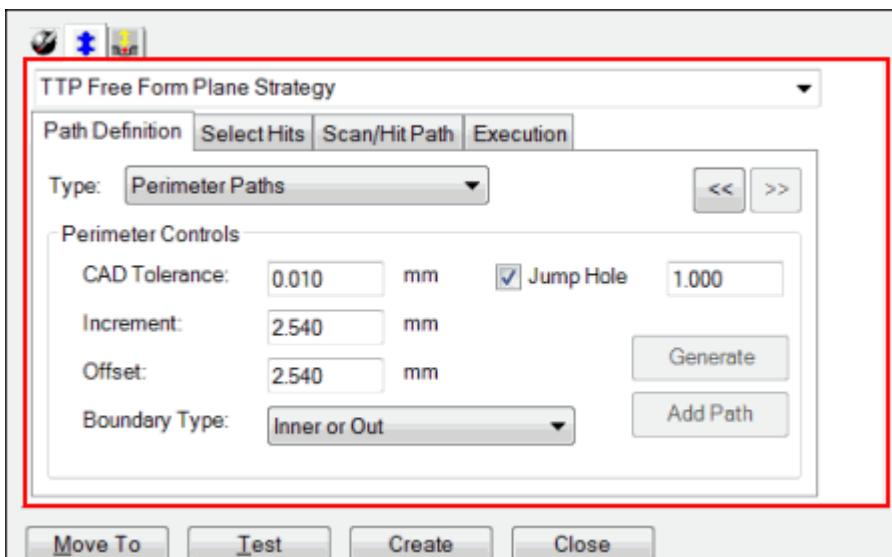
1. 单击 CAD 上的三个点，定义起点、方向点和终点。这些点将显示在点列表区域中。在 # 栏，1 = 起点，D = 方向点，2 = 终点。例如：



边界路径示例

2. 要设置边界控制，请单击

>>。屏幕上将出现边界控制区域。使用此区域中的属性可控制边界点的生成。



边界控制区域示例

CAD 公差 - 键入点定位算法所用的公差。

增量 - 键入相邻点的最小间距。

偏置 - 键入离界限的偏置距离。

界限类型 -

计算路径时，应选择选定曲面上所显示的界限类型：仅内部、内部或外部，或者仅外部。

跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，若选择此复选框，即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

生成 - 要生成点并在点列表区域中显示这些点，请单击此按钮。PC-DMIS

将在“图形显示”窗口的 CAD

上显示生成的路径。您可以更改起点、方向点和终点，然后重新生成扫描路径（如需）。

添加路径 -

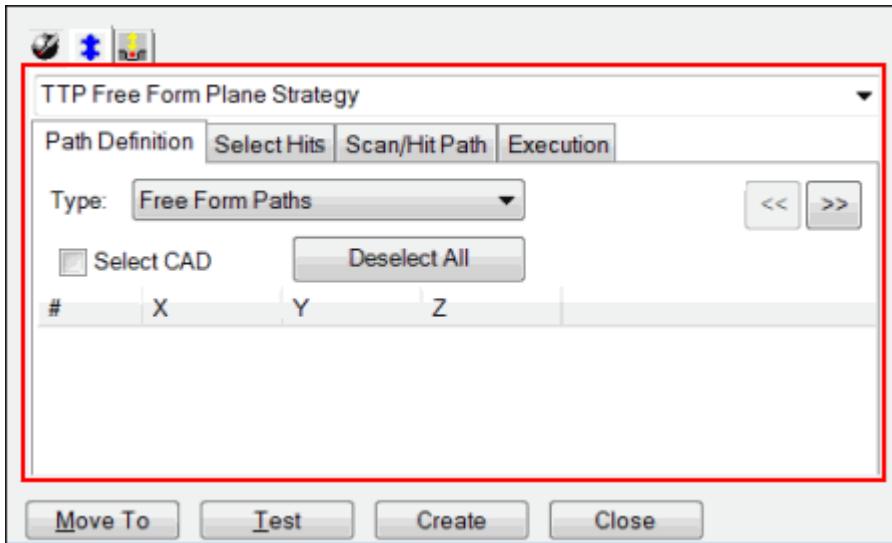
要添加点至扫描/测点路径选项卡，请单击此按钮。当添加扫描路径时，测点的选择也将基于选择测点选项卡上当前指定的选择标准。

自由形状路径方法

使用此方法可生成沿定义的点路径的扫描路径。此步骤需要使用 CAD。要生成扫描路径，请使用此方法：

1. 单击

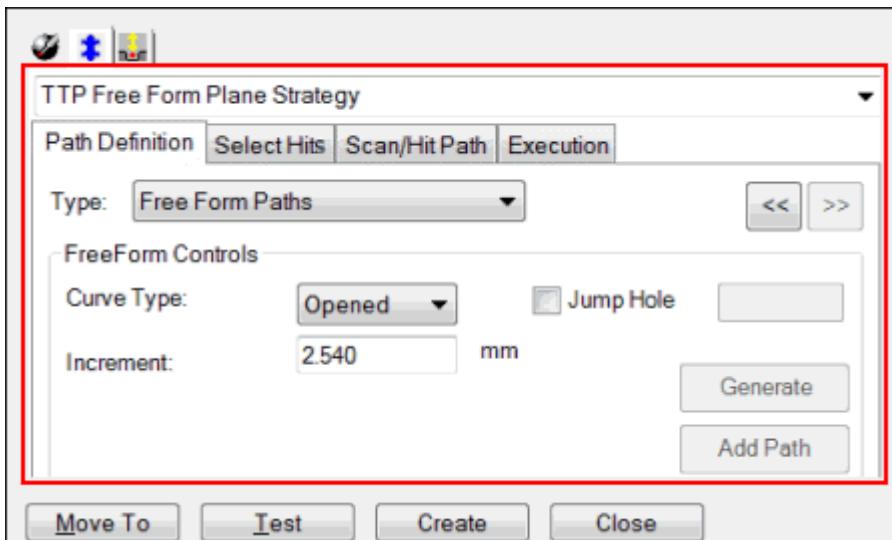
CAD，定义自由形状路径。必须至少记录五个点，以计算扫描路径。这些点将显示在点列表区域中。例如：



自由形状路径示例

2. 要设置自由形状路径控制，请单击

>>。屏幕上将出现**自由形状控制区域**。使用此区域中的属性可控制自由形状点的生成：



自由形状控制区域示例

曲线类型 – 选择要生成的路径类型：开线或闭线。

增量 - 键入相邻点的最小间距。

跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，若选择此复选框，即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

生成 -

要生成点并在点列表区域中显示这些点，请单击此按钮。生成的路径将显示在“图形显示”窗口中的 CAD

上。您可以更改定义自由形状路径的点，然后重新生成扫描路径（如需）。

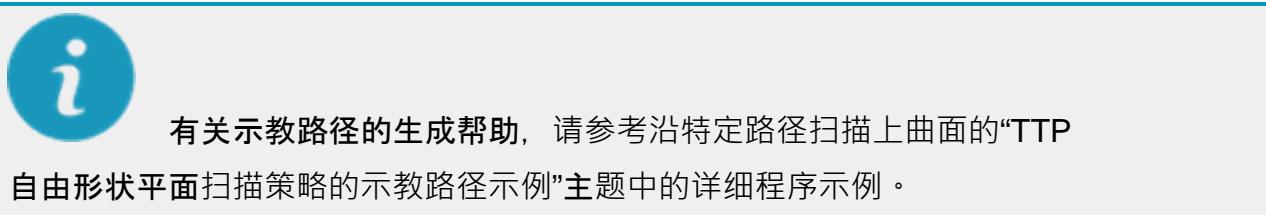
添加路径 -

要添加点至扫描/测点路径选项卡，请单击此按钮。当添加扫描路径时，测点的选择也将基于选择测点选项卡上当前指定的选择标准。

示教路径方法

通过在 CMM 或 CAD

上采集测点，可生成或学习扫描路径。该扫描路径由线、弧和/或圆组成。

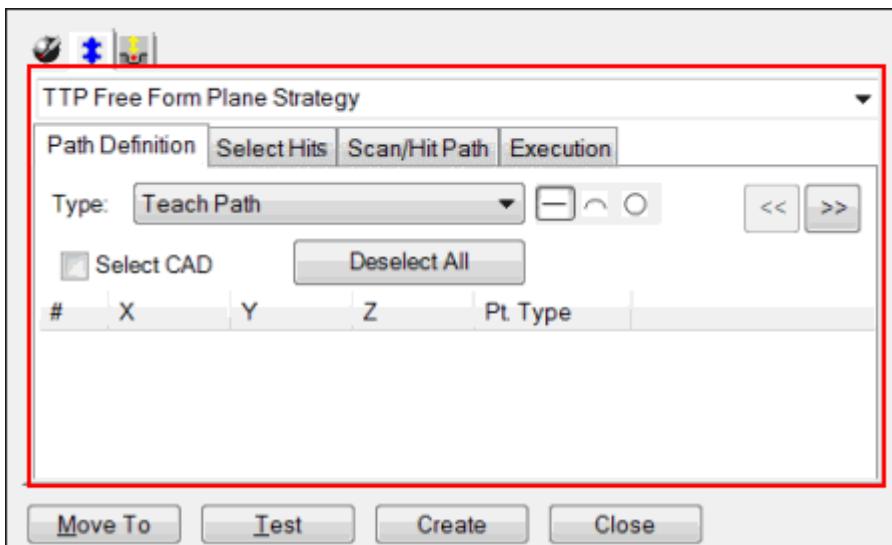


要定义示教路径：

1. 为路径类型选择按钮：

- 线
- 弧
- 圆

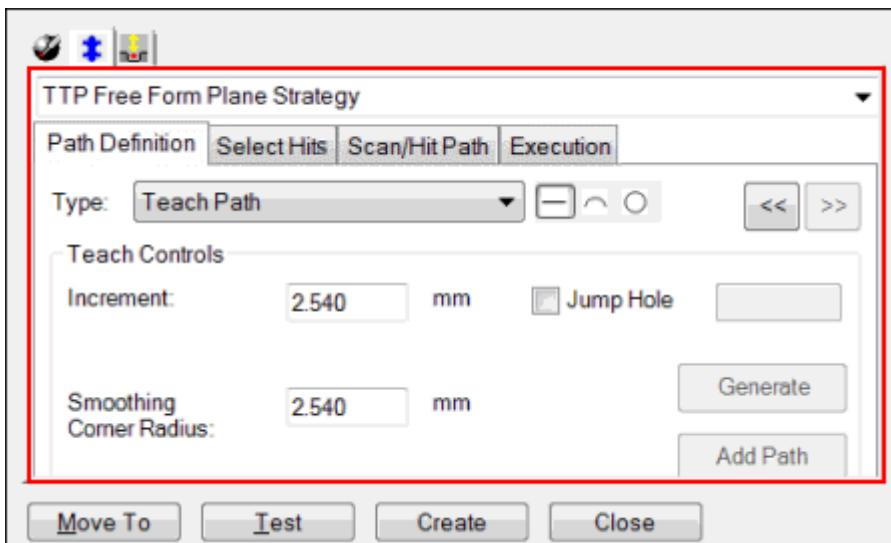
2. 对于线路径，采集一个或两个手动测点。对于弧路径或圆路径，采集两个或三个手动测点。这些点将显示在点列表区域中。例如：



线路径示例

以下项目适用于点列表区域：

- **点类型栏**描述点的类型；例如：起始线、终止线、终止圆或圆中点<数字>
◦
 - 红点表示路径未完成，点将不会被用于生成路径。若更改路径类型（例如，从线更改为弧），则红点将被删除。
 - 要编辑圆路径的起点或终点，这两个点都将更改，因为它们是同一个点。
3. 要设置示教控制，请单击
>>。屏幕上将出现**示教控制区域**。使用此区域中的属性可控制点的生成：



示教控制区域示例

增量 - 键入相邻点的最小间距。

跳到孔 - 只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，选择后，此复选框即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。

平滑棱角半径 - PC-DMIS

生成扫描路径后，交点处将有锐角。平滑棱角半径将有助于消除锐角。如在此框中输入的交点和半径一样，带中心的圆将被定义。将消除此圆内扫描路径中的所有点。

生成 -

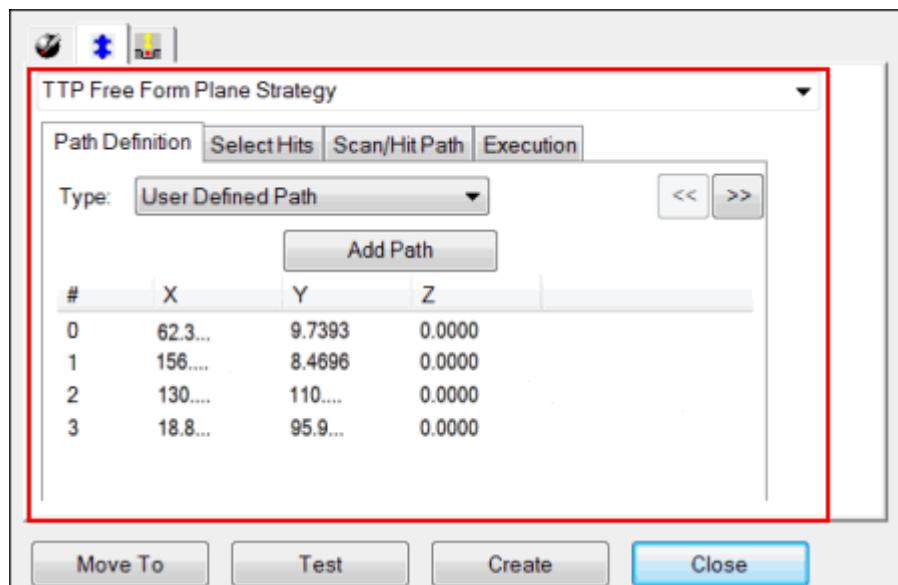
要生成点并在点列表区域中显示这些点，请单击此按钮。生成的路径将显示在“图形显示”窗口中的 CAD 上。您可以更改定义示教路径的点，然后重新生成扫描路径（如需）。

添加路径 -

要添加点至扫描/测点路径选项卡，请单击此按钮。当添加扫描路径时，测点的选择也将基于选择测点选项卡上当前指定的选择标准。

用户定义路径方法

此方法可示教想要采集的测点测量平面。若要示教测点，可使用 CAD 或在测量机上采集测点。当 PC-DMIS 处于手动模式时，此路径生成方法为默认方法。若要使用此方法，在 CAD 上单击所需位置的点或在测量机上采集测点。这些点将显示在点列表区域中。例如：



用户定义路径示例

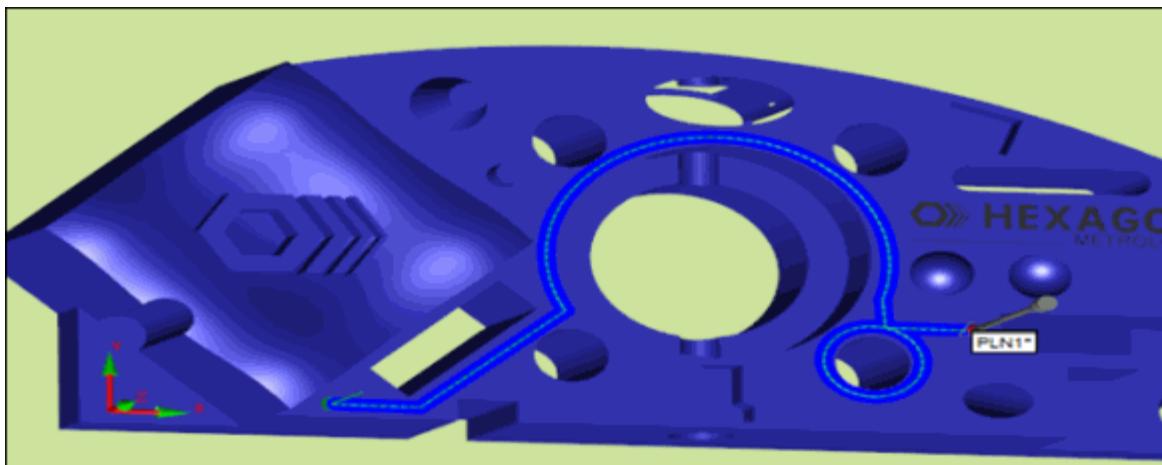
添加路径 - 要添加点至扫描/测点路径选项卡，请单击此按钮。PC-DMIS 会将点添加至扫描/测点路径选项卡，然后如下选择测点：

- 若点列表区域中之前没有可用的点，PC-DMIS 将选择扫描/测点路径选项卡上所有的点作为测点。请注意，**选择测点标签上的选择是按照扇形测点间隔以 0 作为间隔的方法进行选择的（选择扫描路径中的所有测点）。**
- 若点列表区域中之前有可用点，PC-DMIS 将根据**选择测点**选项卡中目前指定的选择标准在**扫描/测点路径**选项卡上选择测点。
- 必要时可添加移动点至**扫描/测点路径**选项卡。

TTP 自由形状平面策略的示教路径示例

TTP 自由形状平面策略的示教路径方法示例显示沿特定路径扫描上曲面的详细程序。

在本例中，假定您要沿以下所示的路径扫描上曲面：

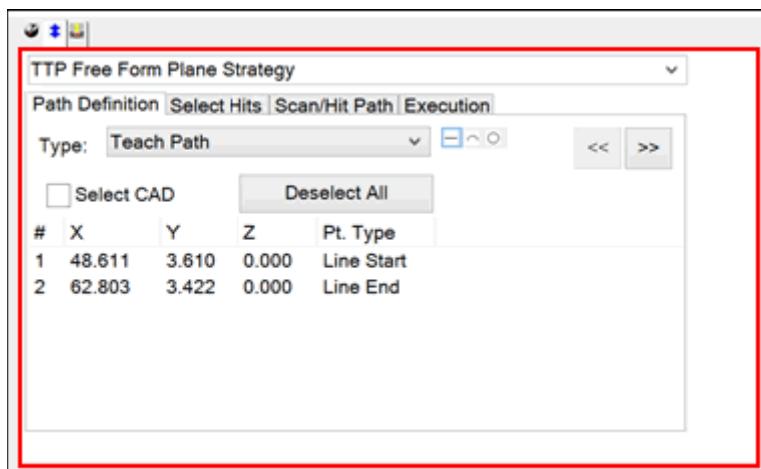


扫描路径

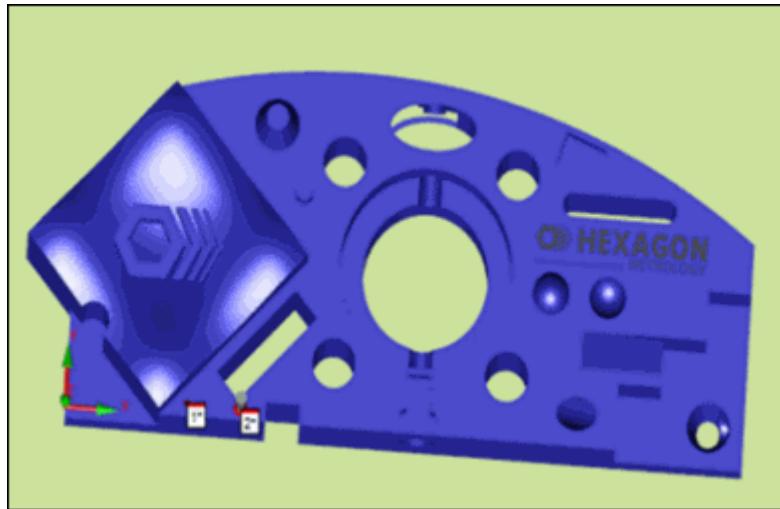
要生成此路径，采集测点，如下所述定义点。这些点记录在**路径定义**选项卡上点列表区域中。这些点在程序中所示的 CAD 上标记出来。

1. 路径中的第一段为线性。要生成此线：

- 选择 **□** 按钮。
- 由于这是第一段，采集两个测点，定义线的点 1 和 2。



第一段中的点 1 和 2

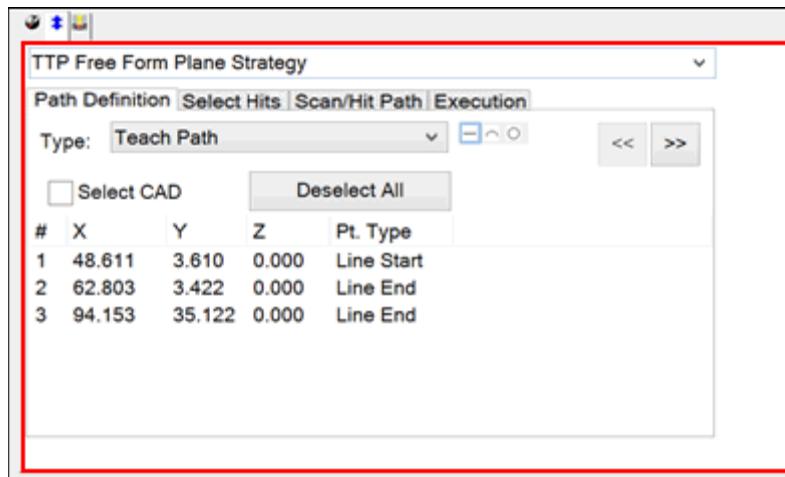


在 CAD 上标记的点 1 和 2

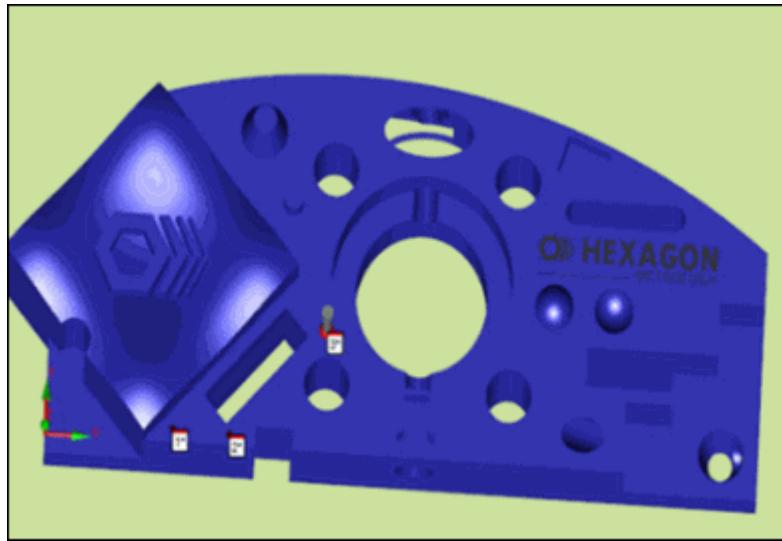
2. 路径中的第二段也为线性。点

2 (第一段线的最后一个点) 将是第二段线的起点。要生成此线：

- 保持选择 按钮。
- 采集一个测点，定义点 3 (第二段线的终点)。



第二段中的点 3



在 CAD 上标记的点 3

3. 扫描路径中的第三段是沿大圆的弧。点

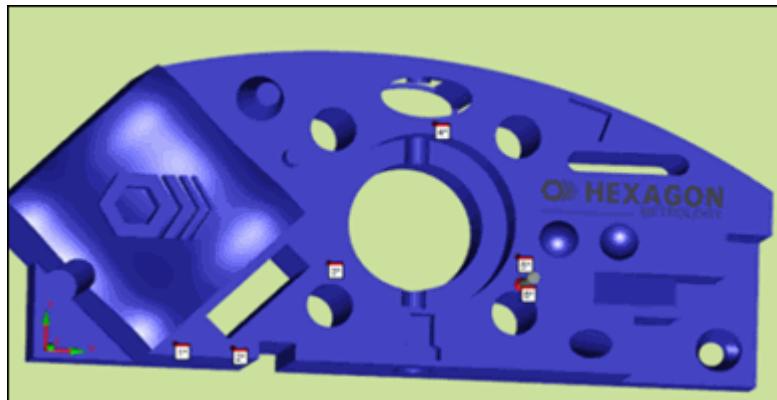
3 (第二段线的最后一个点) 将是弧的起点。最后一个点将是弧的终点。要生成此弧：

- 选择 按钮。
- 在弧上再采集两个测点，定义点 4 和 5。

The screenshot shows a software window titled "TTP Free Form Plane Strategy". The "Path Definition" tab is selected. Under "Type", "Teach Path" is chosen. There is a checkbox labeled "Select CAD" and a button labeled "Deselect All". Below is a table listing five points:

#	X	Y	Z	Pt. Type
1	48.611	3.610	0.000	Line Start
2	62.803	3.422	0.000	Line End
3	94.153	35.122	0.000	Line End
4	124.367	83.564	0.000	Arc Midpoint
5	155.984	42.120	0.000	Arc End

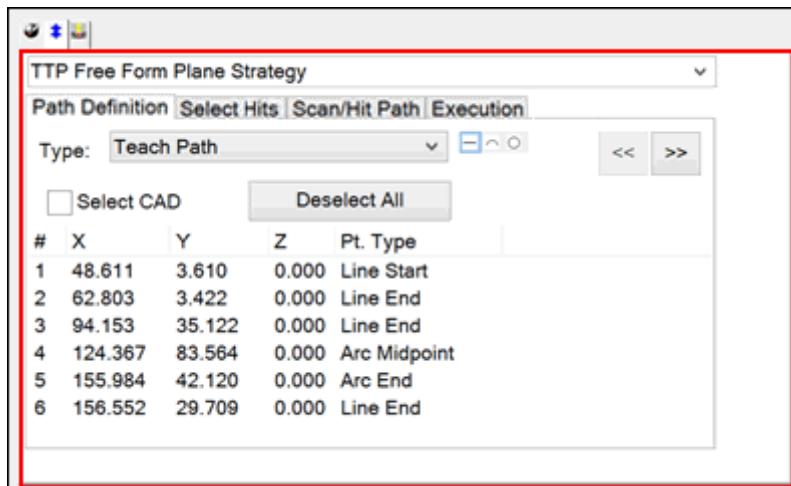
第三段中的点 4 和 5



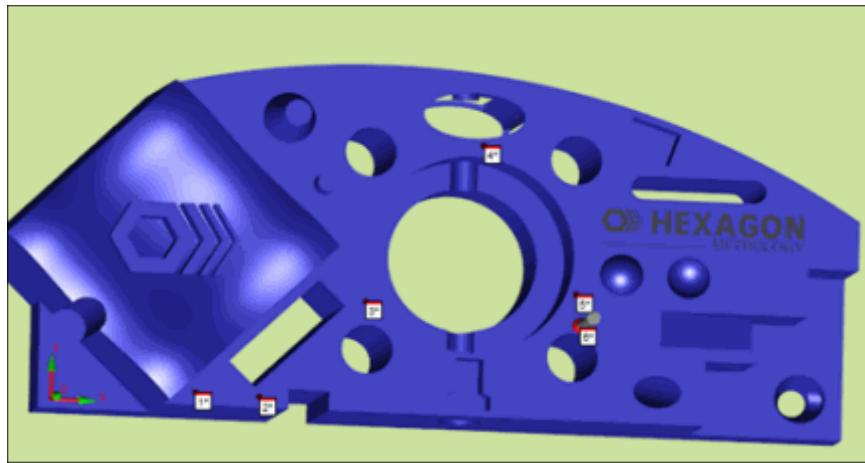
在 CAD 上标记的点 4 和 5

4. 第四段为一条直线。弧的终点将成为线的起点。要生成此线：

- 选择 按钮。
- 采集一个测点，定义点 6（第四段线的终点）。



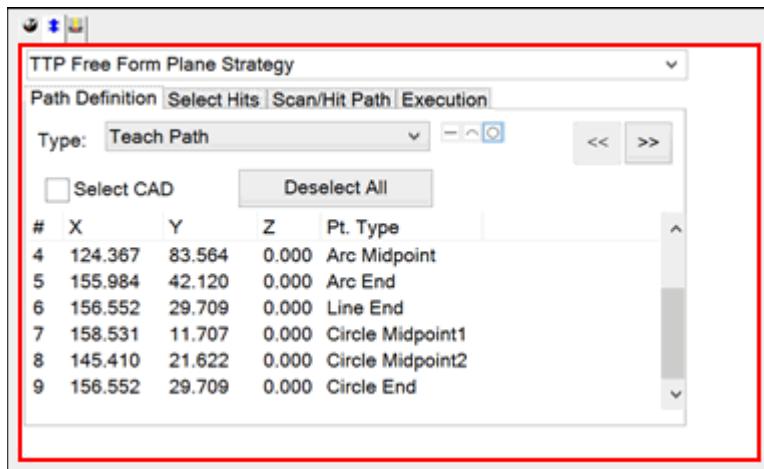
第四段中的点 6



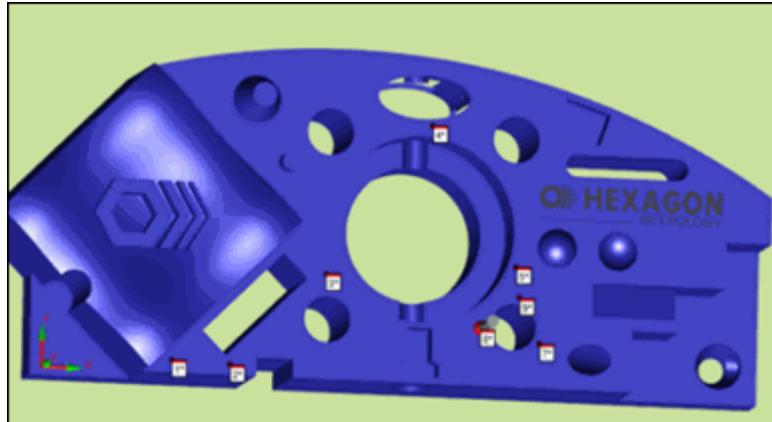
在 CAD 上标记的点 6

5. 现在您需沿小圆扫描 360 度。第四段线的终点将成为圆的起点。要生成此圆：

- a. 选择 按钮。
- b. 再采集两个测点，为圆形路径定义点 7 和 8。由于圆是 360 度，点 9（圆的终点）将被自动记录，与圆的起点相同。



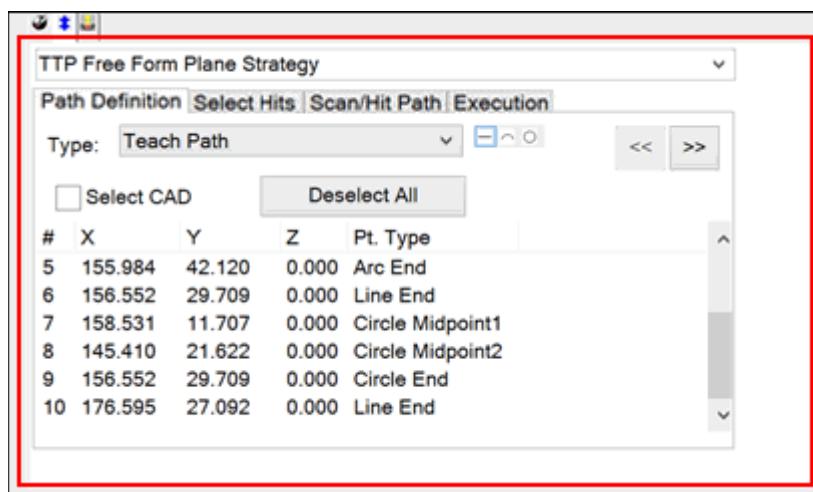
圆中的点 7 至 9



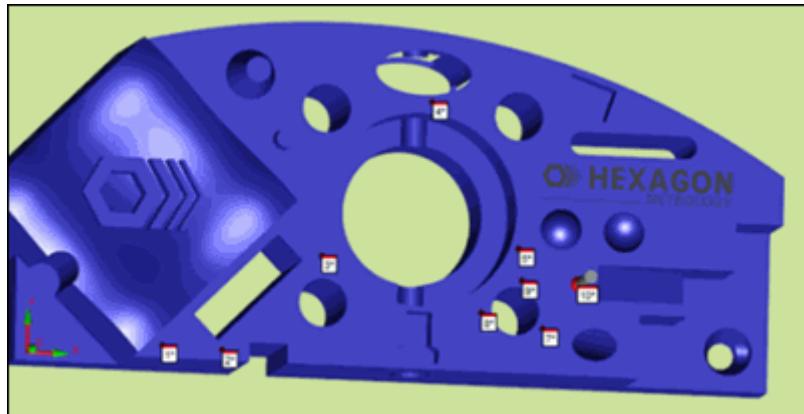
在 CAD 上标记的点 7 至 9

6. 最后一段是一条直线。点 9 (圆的终点) 将成为线的起点。要生成此线：

- 选择 按钮。
- 采集最后一个测点，定义点 10，然后可完成扫描路径。

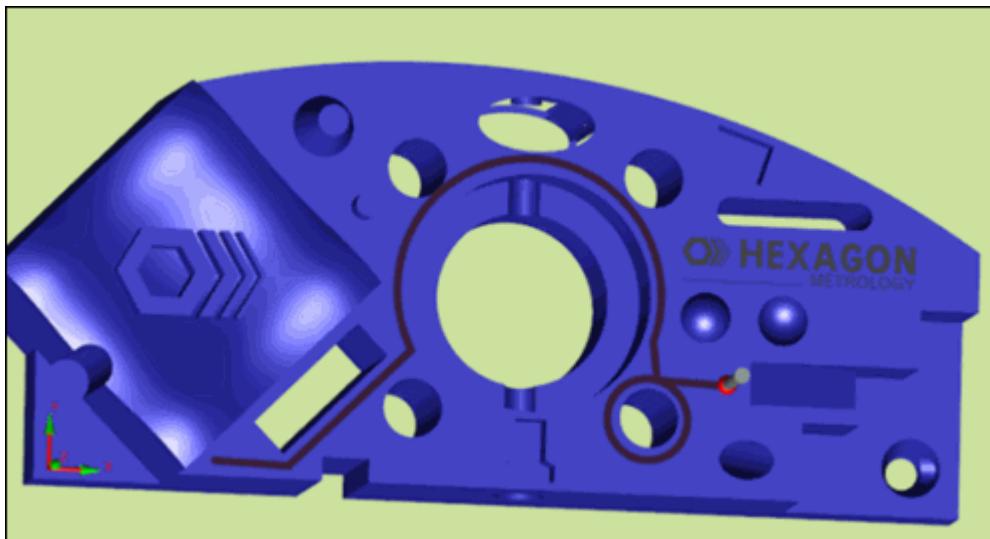


最后一段中的点 10



在 CAD 上标记的点 10

7. 选择 >> 按钮。在示教控件区域的增量框中，输入 1。
8. 单击生成。生成的扫描路径显示在“图形显示”窗口中。

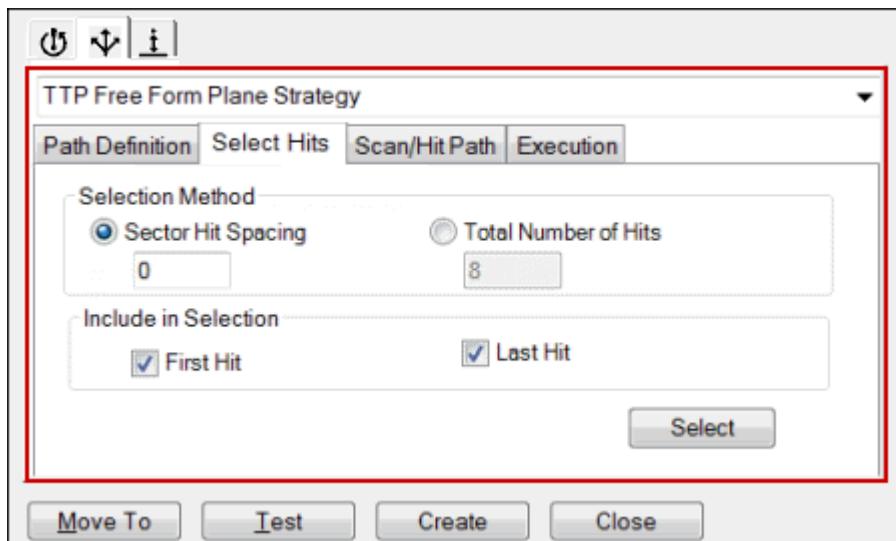


生成的扫描路径

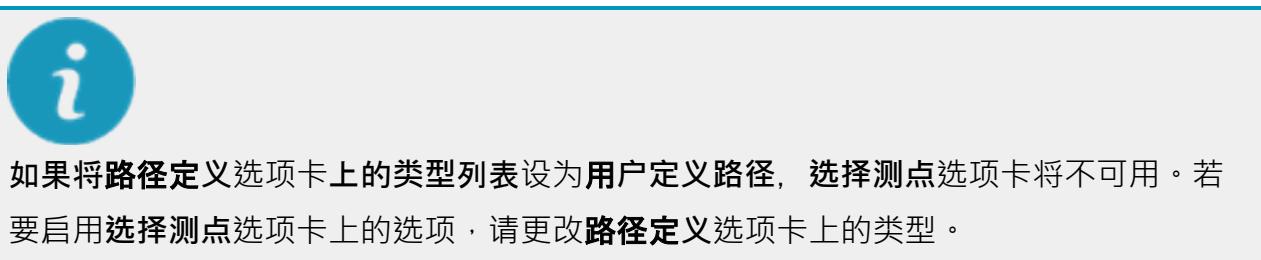
选择测点选项卡 - TTP 自由形状平面策略

TTP

自由形状平面策略的选择测点选项卡可帮助您从生成的扫描路径中选择测点。扫描路径中的点被分解成“扇形”。扫描路径中的每个 "SectorEnd" 表示扇形的终点。您无法在测点路径中选择 "SectorEnd"。



选择测点选项卡示例



选择方法区域

若要从扫描区域点中选择测点，请选择适当的方法：

- **扇形测点间隔 -**

对于此方法，测点是在扇形中选定的。输入每个扇形中选定测点之间的间隔。您输入的数是两个选定测点之间的间隔。



以下示例表示值为 0、1 或 3 时选中的点：

0 = 选定扫描路径中的所有测点。

1 = 选定替代测点。例如，仅选定点 1、3、5 和 7。

3 = 不选择选定测点后的三个测点。例如，若选择的点数为 1，下一个选定的测点将为 5；**将不选择测点 2、3 和 4**。下一个选定的测点将为 9；**将不选择测点 6、7 和 8**。

扇形测点间隔选项的默认设置为 0。如果值为 0，PC-DMIS 将选择扫描路径中的所有测点作为测点路径中的一个测点。

- **测点总数 -**

对于此方法，输入所需的测点总数。从扫描路径中选择的测点数等于您输入的数值。
◦ PC-DMIS 不将扇形考虑为测点的选择范围。

包括在选择范围内

选择是否包括第一个测点、最后一个测点或包含这两个测点。

第一个测点 - 基于选择方法选择的第一个测点。

最后一个测点 - 基于选择方法选择的最后一个测点。

如果您选择了**扇形测点间隔**选项，默认情况下将选择每个扇形中的第一个和最后一个测点。

如果您选择了**测点总数**选项，默认情况下将选择完整列表中的第一个和最后一个测点。

选择

若要基于您在此选项卡上指定的标准选择测点，单击此按钮。选定的测点突出显示在**扫描 / 测点路径**选项卡上。



测点路径中选定了扫描路径中的所有移动点。

当 PC-DMIS

生成路径时，它将根据您在**选择测点**选项卡上指定的标准选择测点。您可修改选项卡上的标准然后单击**选择**按钮，以修改测点的选择范围。

“扫描/测点路径”选项卡 - TTP 自由形状平面策略

使用 TTP 自由形状平面策略的扫描/测点路径选项卡可执行以下操作：

- 显示扫描点并移动点
- 导入扫描点并从文本文件中移动点
- 导出扫描点并将点移动至文本文件
- 插入移动点或断点
- 从扫描路径或测点路径中删除点
- 将点从扫描路径添加至测点路径

例如：

#	X	Y	Z
1	63.153	2.540	0.000
2	65.693	2.540	0.000
3	68.233	2.540	0.000
4	70.773	2.540	0.000
5	73.313	2.540	0.000
6	75.853	2.540	0.000
7	78.393	2.540	0.000
8	80.569	2.878	0.000
9	81.925	4.062	0.000
..

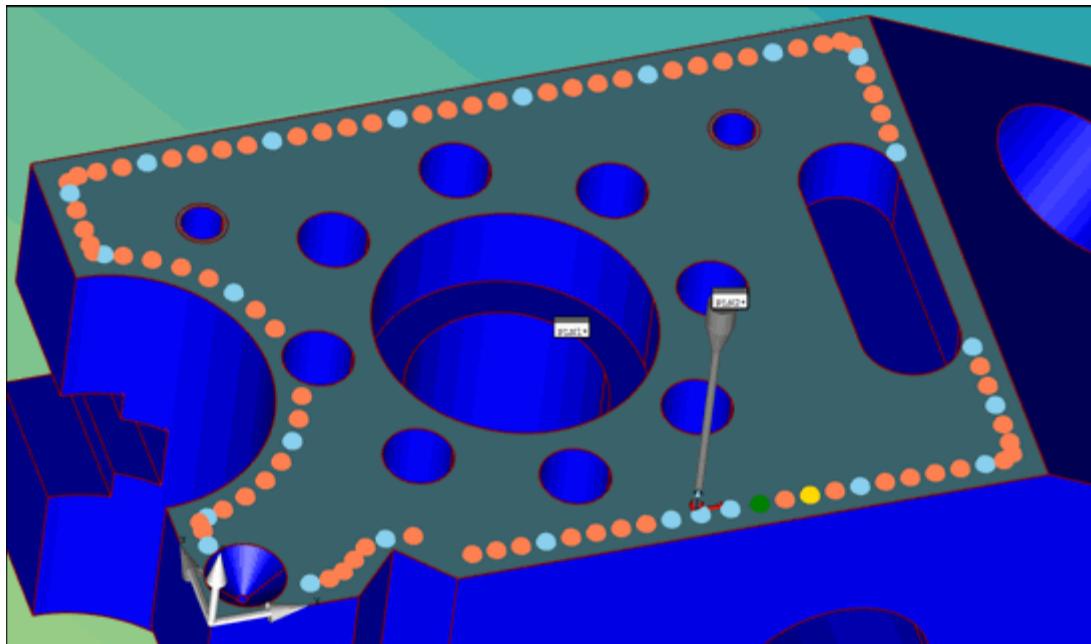
“扫描路径”选项卡示例

以下项目将出现在点列表区域中：

- # - 识别 生成的点的数字

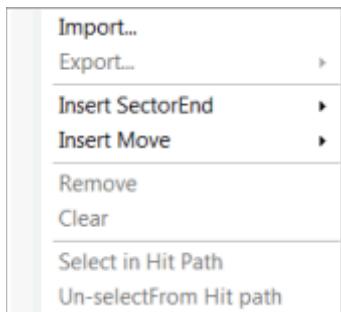
- X、Y 和 Z - XYZ 值

单击扫描路径中的任一点时，PC-DMIS 将在 CAD 曲面上突出显示该点。例如：



CAD 曲面上突出显示的点的示例

要执行其他功能，右击点列表区域。屏幕上将出现以下选项：



点列表选项

导入 -

要导入扫描点并从文本文件中移动点，请选择此选项。运行测量程序时，可从文本文件中动态读取扫描路径。此功能有助于扫描零件变体上的平面，在该平面上所扫描的平面形状在变体间发生变化。

部分文本文件示例如下所示：

```
-32.23,14.067,-0.001,SCAN
-29.2,6.684,-0.006,SCAN
-24.389,1.846,-0.008,SCAN
-19.309,-3.982,-0.004,SCAN
-15.327,-8.125,-0.004,SCAN
-9.949,-9.576,-0.004,SCAN
-4.838,-11.112,-0.001,SCAN
6.786,-10.431,-0.005,SCAN
12.121,-4.769,-0.003,SCAN
17.941,1.332,-0.005,SCAN
21.889,7.432,-0.002,SCAN
26.623,10.02,-0.004,SCAN
0,0,0,BREAK
27,10,50,MOVE
30.361,9.192,-0.003,SCAN
```

在本例中：

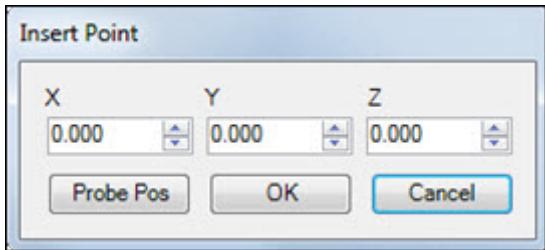
- SCAN - 表示将添加到扫描中的点。
- BREAK - 表示移至“回退”，然后另一个扫描将在下一个 SCAN 点处开始。
- MOVE - 表示移至指定位置。

导出 - 要导出扫描路径至文本文件，请选择此选项。

插入扇形终点 - 要在扫描点之间插入扇形终点，请选择此选项。此后，PC-DMIS 将创建“扇形”。由于任何原因路径不连续时，将在扫描路径中生成扇形终点。

插入移动点 -

要插入移动点以避免障碍，请选择此选项。扫描路径中的移动点有助于将面作为一个平面进行扫描，即使由于任何原因路径不是连续的。屏幕上将出现**插入点**对话框：



“插入点”对话框

您可定位测头，然后单击测头位置，在该位置插入移动点。

删除 -

要删除一个点，在点列表区域中突出显示该点并右击该点，然后选择此选项。

清除 - 要删除所有点，右击点列表区域，然后选择此选项。当出现“删除所有点？”消息时，单击**确定**。

在测点路径中选择 -

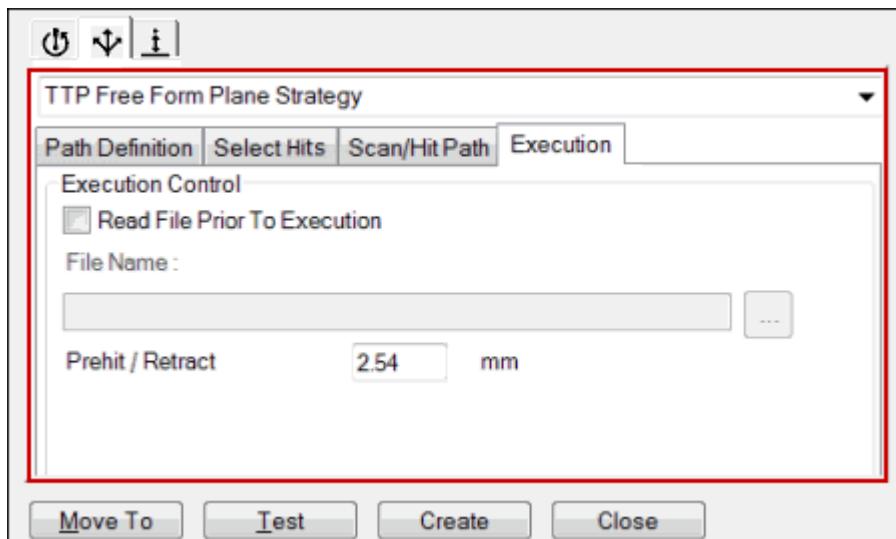
要将点添加至测点路径（并突出显示该点），右击该路径，然后选择**在测点路径中选择**。

从测点路径中取消选择 - 要从测点路径中删除点，则选择此选项。

“执行”选项卡 - TTP 自由形状平面策略

使用 TTP 自由形状平面策略的执行选项卡来设置此策略的其他选项。

选择此选项卡时，屏幕上将出现**执行控制区域**。例如：



“执行”选项卡示例

执行前读取文件 -

要从文本文件执行前读取测点路径，请选择此复选框。这样做有助于测量零件变体。

文件名 - 键入执行前要读取的文件路径和名称。要选择文件，单击浏览。

预碰 / 回退 - 键入预碰和回退距离。这些值将覆盖全局预碰和回退值。

TTP 平面圆策略

通过在圆形路径中生成测点，平面自动特征的接触触发测头 (TTP)

平面圆策略可测量平面。顾名思义，此策略取一个测点。接触触发测头和扫描测头可使用此策略。

此策略的优点是能按照您在策略选项卡上指定的标准生成测点路径。您可添加移动点，避免路径中出现障碍。

策略的选项卡位于自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动 | 平面）中的测头工具箱中：

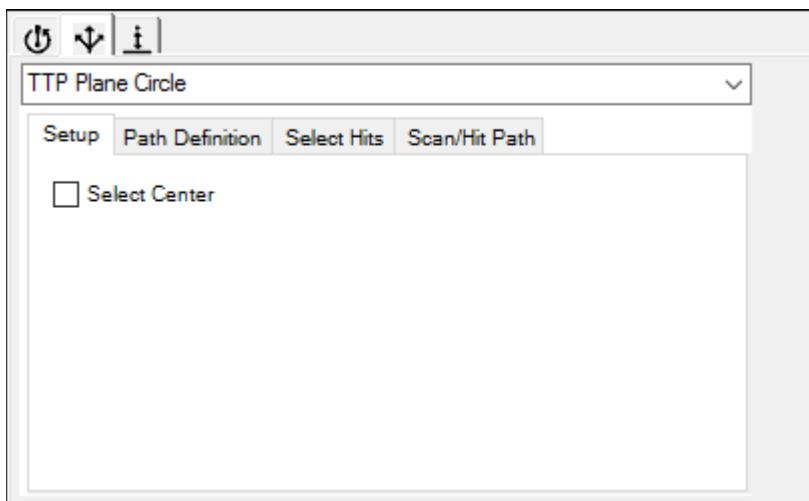
- 设置选项卡
- 路径定义选项卡
- 选择测点选项卡

- 扫描/测点路径选项卡

有关测头工具箱和选择测量策略的完整信息，请参见“使用测量策略”。

“设置”选项卡 - TTP 平面圆策略

使用 TTP 平面圆策略的设置选项卡选择圆形路径的中心。例如：



“设置”选项卡示例

选择中心

若选择此复选框，您可单击

CAD，指出圆形路径的中心点。您可选择圆、圆柱或任何圆形特征。PC-DMIS 将执行以下操作：

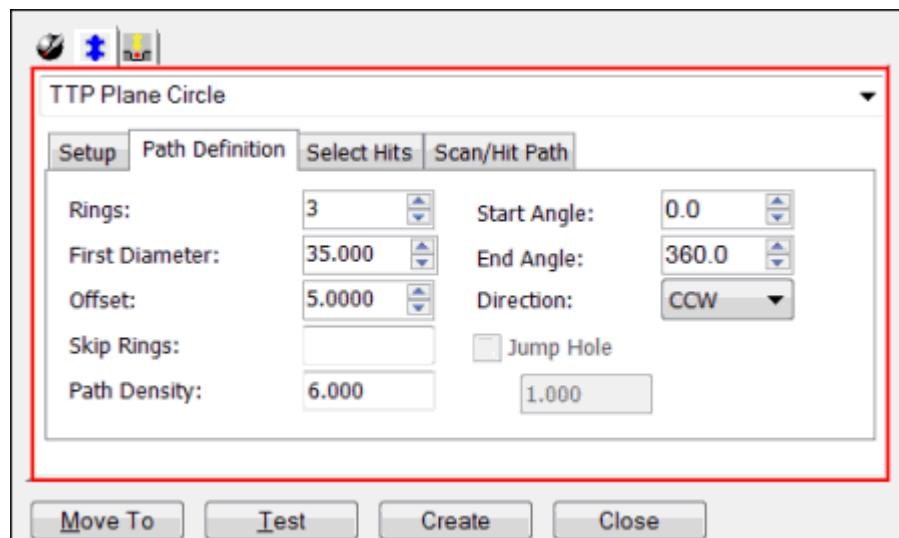
- 使用选择点的信息填写**自动特征对话框**（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）中的**特征属性区域**。
- 填写**路径定义选项卡上的第一个直径框**。
- 测点的生成和选择基于**选择测点选项卡上当前指定的选择标准**。

“路径定义”选项卡 - TTP 平面圆策略

TTP

平面圆策略的**路径定义**选项卡提供一些选项来定义圆形扫描路径/测点路径。当生成扫描路径时，测点的选择也将基于**选择测点**选项卡上当前指定的选择标准。

只要更新路径定义参数，然后移开光标，即可查看扫描路径/测点路径。您也可查看“图形显示”窗口中更新的扫描路径/测点路径。



“路径定义”选项卡示例

环

键入或选择环数。

第一个直径

键入第一个环的直径。

偏置

键入第一个环的直径。

跳过环

键入要跳过的环数。



要跳过环 2 和 4，键入 **2,4**。要跳过环 2 至 5，键入 **2-5**。

路径密度

键入将生成用于创建扫描路径的每毫米点数。

起始角度

键入或选择起始角度（单位：度）。

终止角度

键入或选择终止角度（单位：度）。

方向

选择 **CWS**（顺时针）或 **CCW**（逆时针）。

跳过孔

只要扫描路径位于 CAD

曲面的孔之上，若选择此复选框，即可在扫描路径中生成断点。在框中键入离边缘的所需距离。



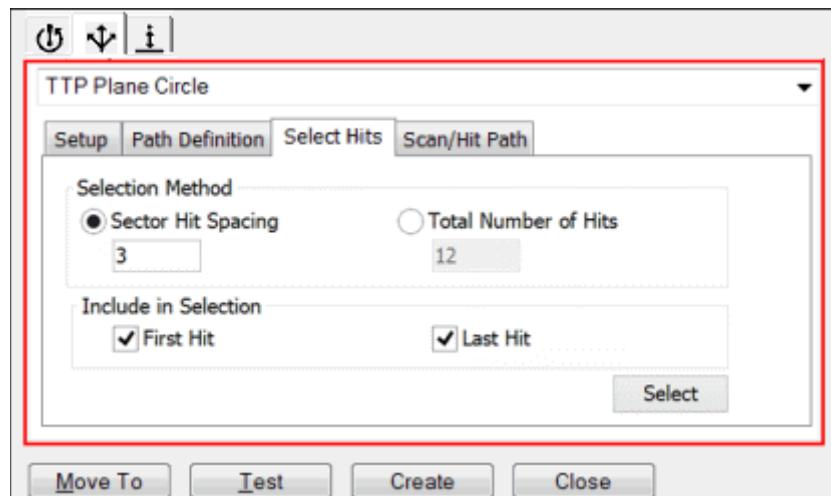
如果已选择**跳到孔**复选框，PC-DMIS 将 360

度围绕路径中的每个点查找断点。如果路径距到边缘的跳孔距离较近，PC-DMIS 将跳到该路径，然后删除路径。

选择测点选项卡 - TTP 平面圆策略

使用 TTP

平面圆策略的选择测点选项卡可帮助您从生成的扫描路径中选择测点。扫描路径中的点被分解成“扇形”。扫描路径中的每个终点均表示扇形的端点。您无法在测点路径中选择扇形终点。



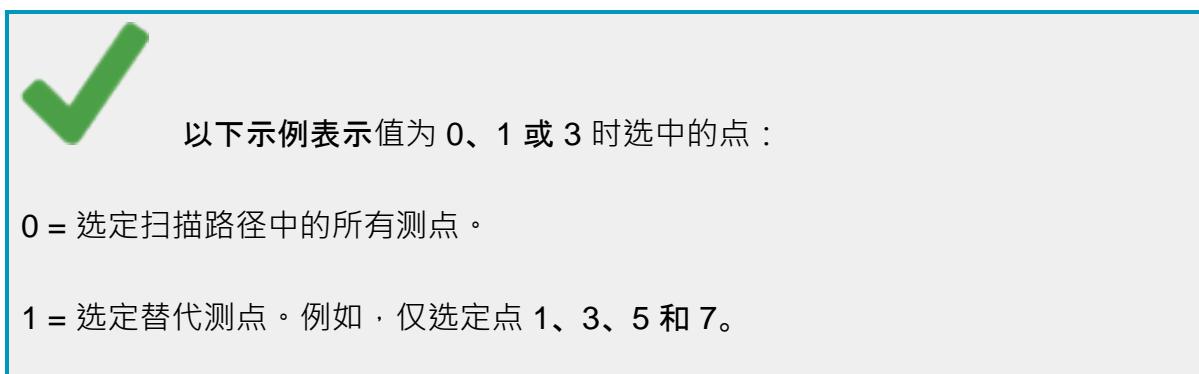
选择测点选项卡示例

选择方法区域

若要从扫描区域点中选择测点，请选择适当的方法：

- **扇形测点间隔 -**

对于此方法，测点是在扇形中选定的。输入每个扇形中选定测点之间的间隔。您输入的数是两个选定测点之间的间隔。



3 = 不选择选定测点后的三个测点。例如，若选择的点数为 1，下一个选定的测点将为 5；将不选择测点 2、3 和 4。下一个选定的测点将为 9；将不选择测点 6、7 和 8。



扇形测点间隔选项的默认设置为 0。如果值为 0，PC-DMIS 将选择扫描路径中的所有测点作为测点路径中的一个测点。

- **测点总数 -**

对于此方法，输入所需的测点总数。从扫描路径中选择的测点数等于您输入的数值。
• PC-DMIS 不将扇形考虑为测点的选择范围。

包括在选择范围内

选择是否包括第一个测点、最后一个测点或包含这两个测点。

第一个测点 - 基于选择方法选择的第一个测点。

最后一个测点 - 基于选择方法选择的最后一个测点。

如果您选择了**扇形测点间隔**选项，默认情况下将选择每个扇形中的第一个和最后一个测点。

如果您选择了**测点总数**选项，默认情况下将选择完整列表中的第一个和最后一个测点。

选择

若要基于您在此选项卡上指定的标准选择测点，单击此按钮。选定的测点突出显示在**扫描 / 测点路径**选项卡上。



测点路径中选定了扫描路径中的所有移动点。

当 PC-DMIS

生成路径时，它将根据您在**选择测点**选项卡上指定的标准选择测点。您可修改选项卡上的标准然后单击**选择按钮**，以修改测点的选择范围。

“扫描/测点路径”选项卡 - TTP 平面圆策略

使用 TTP 平面圆策略的扫描/测点路径选项卡执行以下操作：

- 显示路径中的测点（这些点突出显示在此选项卡上）
- 显示扫描路径点并移动点
- 插入移动点或扇形终点
- 从扫描路径或测点路径中删除点
- 将点从扫描路径添加至测点路径

例如：

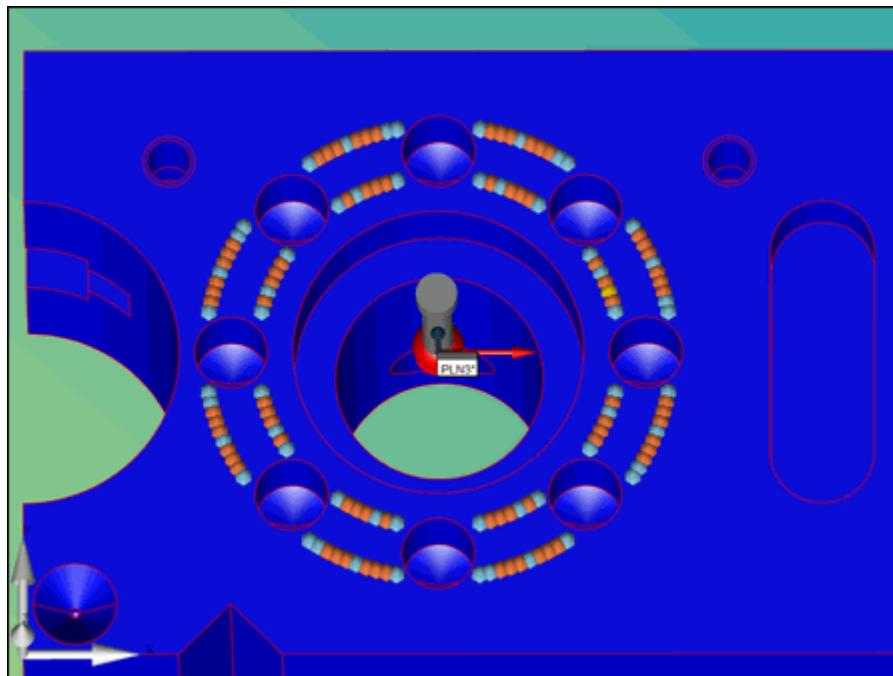
#	X	Y	Z
1	63.500	30.000	0.000
2	63.329	31.082	0.000
3	62.832	32.057	0.000
4	62.057	32.832	0.000
5	61.082	33.329	0.000
6	60.000	33.500	0.000
7	58.918	33.329	0.000

“扫描/测点路径”选项卡示例

以下项目将出现在点列表区域中：

- # - 识别生成的点的数字
- X、Y 和 Z - XYZ 值
- 突出显示的点 - 路径中的测点

单击扫描/测点路径中的任一点时，PC-DMIS 将在 CAD 曲面上突出显示该点。例如：



CAD 曲面上突出显示的点的示例：

橘色 = 扫描路径点

蓝色 = 测点路径点

金色 = 单击的点

要执行其他功能，右击点列表区域。屏幕上将出现以下选项：

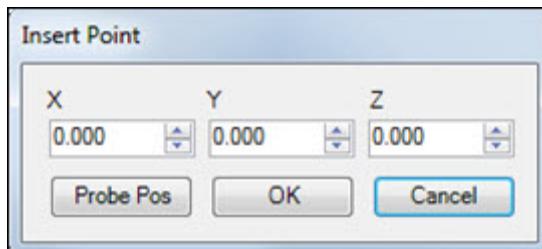


点列表选项

插入扇形终点 -要在扫描点之间插入扇形终点，请选择此选项。此后，PC-DMIS 将创建“扇形”。由于任何原因路径不连续时，将在扫描路径中生成扇形终点。

插入移动点 -

要插入移动点以避免障碍，请选择此选项。扫描路径中的移动点有助于避免扫描路径中的障碍物。屏幕上将出现**插入点**对话框：



“插入点”对话框

您可定位测头，然后单击测头位置，在该位置插入移动点。

删除 -

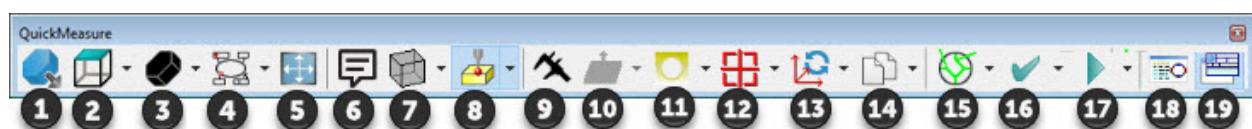
要删除一个点，在点列表区域中突出显示该点并右击该点，然后选择此选项。

在测点路径中选择 -

要将点添加至测点路径（并突出显示该点），右击该路径，然后选择**在测点路径中选择**。

从测点路径中取消选择 -要从测点路径中删除点，则选择此选项。

CMM QuickMeasure 工具栏



PC-DMIS CMM QuickMeasure 工具栏

CMM QuickMeasure 工具栏模拟 CMM

上的典型操作流程。要访问该工具栏，可选择视图 | 工具栏 | QuickMeasure。

该工具栏提供许多按钮的下拉功能。PC-DMIS

会存储所有这些按钮最后选择的选项并在下次软件显示 QuickMeasure 工具栏时显示这些选项。

可将下拉按钮添加至可通过视图 | 工具栏 |

自定义菜单项自定义的任何自定义工具栏。有关详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“自定义工具栏”一章。

以下选项可用：



1. 从 CAD 文件导入 -

显示打开对话框，该对话框可用于从库中浏览并导入任一支持的零件模型。选择文件类型列表，查看文件类型。PC-DMIS

可记住您上一次使用此按钮选择的文件类型，且将默认使用该文件类型。有关导入文件的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用高级文件选项”一章中的“导入 CAD 数据或特征数据”。

2. 图形视图按钮和下拉箭头 -

将“图形显示”中的图形重置为按钮上所显示的图形视图。

单击箭头，显示图形视图工具栏：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“图形视图工具栏”主题。

3. 图形样式按钮和下拉箭头 -

将“图形显示”中的图形重置为显示或隐藏按钮上所显示的图形样式。

单击下拉箭头，显示**图形样式工具栏**：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“图形视图工具栏”主题。

4. 图形项目按钮和下拉箭头 -

将“图形显示”窗口中的图形更改为显示或隐藏按钮上所显示的图形项目属性。

单击下拉箭头，显示**图形项目工具栏**：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“图形项目工具栏”主题。

5. 缩放到适合 (Ctrl+Z) -

重绘零件图像，从而完全适合“图形显示”窗口。对于过大图像或者过小图像，此功能都非常有用。按键盘上的 Ctrl+Z，也可重绘图像。

6. 注释按钮 -

打开**注释**对话框，以便将不同的注释类型插入测量程序。默认情况下，软件会选择**操作员**选项。

有关详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**插入程序员注释**”。

7. **ClearanceCube** 按钮和下拉箭头 - 根据从下拉工具栏中所选择的选项，PC-DMIS 将执行按钮上所显示的 ClearanceCube 功能。

单击下拉箭头，显示 **ClearanceCube** 工具栏：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS Core 核心文档中的“ClearanceCube 工具栏”主题。

8. 测头模式按钮和下拉箭头 -

设置按钮上所显示的测头模式特征并添加至测量程序。

如果可在手动模式和 DCC
模式之间作出选择，单击下拉箭头可显示“测头模式”工具栏。



请参见 PC-DMIS 核心文档中的“测头模式工具栏”主题。

9. 测径器 按钮 - 打开量规对话框，以便将“量规”命令添加至当前测量程序。

有关详细信息，请参阅 PC-DMIS Laser 文档中的“测径器概述”主题。

10. 自动特征按钮和下拉箭头 -

显示与按钮上所示的图标相关的**自动特征**对话框。从此对话框中，可选择任何可用特征命令，插入测量程序。

单击下拉箭头，显示**自动特征**工具栏：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中“创建自动特征”一章中的“插入自动特征”主题。

11. 构造特征按钮和下拉箭头 -

显示与按钮上所示的图标相关的**构造特征**对话框。从此对话框中，可选择任何可用特征命令，插入测量程序。

单击下拉箭头，显示**构造特征工具栏**：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“从现有特征构造新特征”一章中的“从现有特征构造新特征：简介”主题。

12. 尺寸按钮和下拉箭头 -

显示与按钮上所示的图标相关的**尺寸**对话框。从该对话框中，可选择任一可用特征命令，插入测量程序。

单击下拉箭头，显示**尺寸工具栏**：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“使用旧版尺寸”一章中的“尺寸位置”主题。

13. 坐标系按钮和下拉箭头 -

坐标系选项基于所选的特征类型、选择顺序以及相对于彼此的特征位置进行定义。

单击下拉箭头，显示**坐标系工具栏**：



有关详细信息，请参见核心文档中“创建和使用坐标系”一章中的相应主题。

14. 复制/粘贴按钮和下拉箭头 -

为在“编辑”窗口中编辑测量例程提供标准的复制/粘贴功能。此按钮也可用于定义特征模式并将该模式粘贴至测量程序。

单击下拉箭头，显示**复制/粘贴/模式工具栏**：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS

核心文档“使用标准编辑命令”一章中的相应**复制和粘贴**主题或“编辑特征模式”一章中的**模式**主题。

15. 路径按钮和下拉箭头 -

该按钮执行所选的路径功能，具体取决于在下拉工具栏中所做的选择。

单击下拉箭头，显示**路径工具栏**：



有关特定路径功能的详细信息，请参见 PC-DMIS

核心文档中的“查看路径线”、“执行路径优化”或“动画显示路径”。

16. 标记按钮和下拉箭头 -

该按钮可标记当前选择的特征，标记所有特征或清除“编辑”窗口中所有编辑的特征，具体取决于在下拉工具栏中所做的选择。

单击下拉箭头，显示**标记工具栏**：



有关详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“编辑窗口工具栏”一章中的相应主题。

17. 执行按钮和下拉箭头 - 运行（或执行）当前标记特征的测量步骤。

单击下拉箭头，显示执行工具栏：



有关单个按钮功能的详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档的“使用高级文件选项”一章中的“执行测量程序”。

18. 状态窗口 -

显示“报告”窗口。在特征执行过程中、尺寸创建或编辑过程中，通过该窗口可在从**快速启动工具栏**创建命令和特征的同时进行预览，在“报告”窗口打开的情况下，在“编辑”窗口上单击其中的项目也可预览。有关详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“使用状态窗口”主题。

19. 报告窗口 -

显示“报告”窗口。执行测量程序后，此窗口显示测量结果并根据默认报告模板自动配置输出。有关详细信息，请参见 PC-DMIS
核心文档的“报告测量结果”一章中的“关于报告窗口”主题。

创建坐标系

创建一个坐标系

坐标系是基准调整以及定义 X、Y 和 Z

轴的基础。如果你已经看过了“入门”一章中的指南，你已经创建了一个简单的 3-2-1 坐标系。



PC-DMIS 在向导工具栏中提供了一个便利的 321 坐标系向导

您也可视需要使用其他坐标系选项，诸如迭代坐标系和最佳拟合坐标系。有关使用坐标系的深入信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“创建和使用坐标系”一章。

测量特征

测量特征：介绍

PC-DMIS 提供两种方法用于定义零件特征并添加到测量例程中，以便于 PC-DMIS 在执行期间测量：

- 测量特征方法
- 自动特征方法

您也可将构造的特征添加至测量程序。这些特征是通过其他特征构造的，本主题将不涉及这些特征。有关构造特征的信息，请参考 PC-DMIS 核心文档中的“通过现有特征构造新特征”一章。

被测量特征方法



测量特征

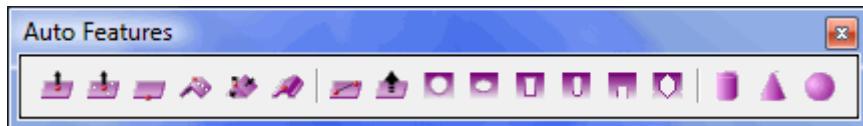
只要在零件上触测测点，PC-DMIS

就会将这些测点解译为不同特征。这些特征被称为“测量特征”，取决于测量数、测量矢量等。支持的测量特征有：

- 点
- 直线
- 平面
- 圆
- 圆槽
- 方槽
- 圆柱
- 圆锥
- 球体
- 环

更多信息，请参阅以下“插入测量特征”。

自动特征方法



自动特征

若您的 PC-DMIS

版本支持自动特征，则可将零件特征作为“自动特征”插入到测量例程中。很多情况下，用鼠标在“图形显示”窗口中单击合适的特征即可识别自动特征。支持的自动特征有：

- 矢量点

- 曲面点
- 棱点
- 角度点
- 隅角点
- 高点
- 平面
- 线
- 圆
- 椭圆
- 平度和间隙
- 圆槽
- 方槽
- 凹口槽
- 多边形
- 圆柱
- 圆锥
- 球体

更多信息，请参阅以下“插入自动特征”。

插入测量特征

若要将测量特征插入到测量例程中，则仅需在零件上的特征上针对所需特征类型采集所需个数的测点，随后按下操纵盒上的“完成”按钮，或按下键盘上的 End 键。PC-DMIS 将特征插入到“编辑”窗口中。

可使用测量特征工具栏执行此操作：



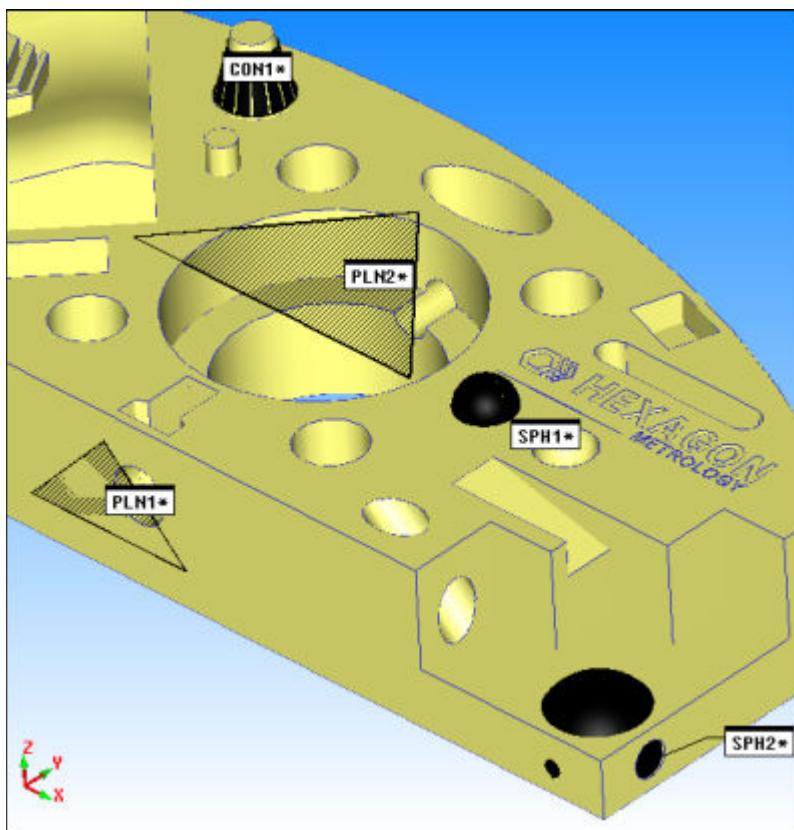
测定特征工具栏

通过单击工具栏上特征按钮之一，告知 PC-DMIS

您将在该类型的特征上采集测点。此确保当完成采集所需个数的测点时，将在测量例程中创建合适的特征。

如果用户不使用这些工具栏按钮中任何一个（或如果用户点击**推测模式按钮**），PC-DMIS 将会根据触测的点数和它们的矢量推测正确的特征类型。

采集测点并创建特征后，PC-DMIS 会立即在屏幕上显示测量特征。对于 3D 测量特征（圆环、圆柱、球体、圆锥和平面）和 2D 平面特征，PC-DMIS 会使用阴影曲面显示特征。



一些带有阴影曲面的测量特征示例

隐藏阴影平面特征

可在测量平面对话框的**显示区域**设置**无**选项，以隐藏阴影平面。还可以在**设置选项**对话框中标记**不显示平面**复选框，以全局隐藏所描绘的所有阴影平面。

更改特征颜色

可使用设置选项对话框中的 **ID**

设置选项卡，修改特征创建过程中的特征颜色。请参见颜色复选框，选择标签项目下的**特征后可显示此复选框**。

请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“创建测量特征”一章。

创建测量点



“点”按钮

您可使用**点**按钮测量位于与参考平面平行的平面上的点或空间中的点的位置。

要创建测定点，必须在零件上采一个测点。

创建一条测量直线



“直线”按钮

通过**直线**按钮可以测量某个与参考平面平行的平面上的直线或空间内某条直线的方向和直线度。若要创建测量直线，必须采集零件上的两个测点。

测量直线和工作平面

当 PC-DMIS 创建测量线时，PC-DMIS

希望在与当前工作平面垂直的矢量上采集直线的测点。



**若当前工作平面是 ZPLUS (矢量
0,0,1) , 并有块状零件 , 则测量直线的测点必须位于此零件的垂直面上 , 比如正面或侧
面。**

**如果用户想测量工件上平面上的线特征 , 需要选择 X 正向、 X 负向、 Y 正向、或 Y 负向工
作平面 , 取决于线的方向。**

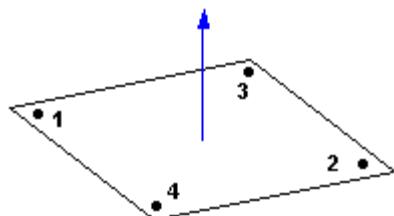
创建一个测量平面



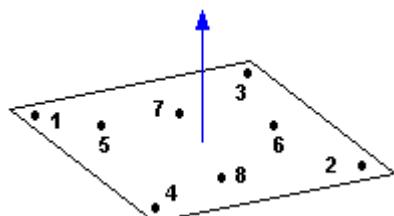
“平面”按钮

使用平面按钮可测量任意平面或者平面的表面。

**要创建测定平面 , 必须至少在任意一个平面上采三个测点。如果仅使用三个测点 , 最好以
一个较大的三角形的方式选择点 , 以便覆盖曲面上尽可能大的区域。**



带四个点的平面示例



带八个点的平面示例

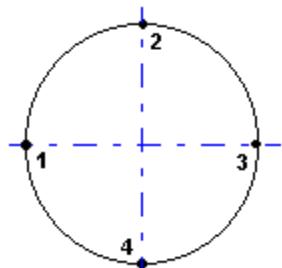
创建一个测量圆



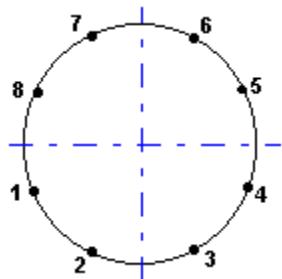
“圆”按钮

使用圆按钮可以测量与参考平面平行的孔/外柱的直径、圆度和圆心位置；即圆柱与参考轴线保持水平的垂直部分。

若要创建测量孔或外柱，必须至少采集三个测点。在测量过程中，系统可以自动识别并设置平面。采集点必须沿圆周均匀分配。



带四个点的圆示例



带八个点的圆示例



“测量单点圆”工具栏按钮

也可使用测量单点圆工具栏按钮，从一个点创建圆。在测量孔时，若测头的球体大小大于孔的直径，因而无法完全放入孔中按一般要求至少采集三个测点时，这种方法十分有用。详细信息请参见 PC-DMIS Portable 文档。

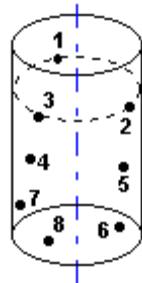
创建测量圆柱



“圆柱”按钮

使用柱体按钮可以测量空间柱体的直径、圆柱度和轴的方位。所挑选点的重心位置也将被计算。

若要创建测量圆柱，必须至少采集圆柱上的六个测点。采集点必须均匀地分布于曲面上。前三个采集点必须位于与主轴线垂直的平面上。



带八个点的圆柱示例



某些点的模式（如两列等距的三点或两列等距的四点）有多种构造或测量圆柱的方式。PC-DMIS 的最佳拟合算法可能使用非预期的解构造或测量圆柱。要得到最佳结果，测量或构造柱体应使用可以消除不期望方案的点模式。

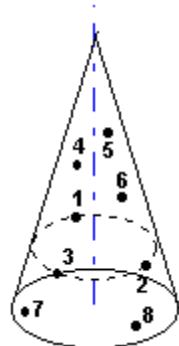
创建一个测量圆锥



“圆锥”按钮

使用圆锥按钮可测量锥形状，顶端的锥角以及锥轴向的方向。

要创建测定锥体，用户必须至少采六个测点。要采的点必须均匀分布在曲面上。前三个采集点必须位于与主轴线垂直的平面上。



带八个点的圆锥示例

创建测量球



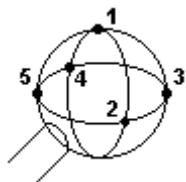
“球”按钮

使用球按钮可测量直径，球面度以及球中心的位置。

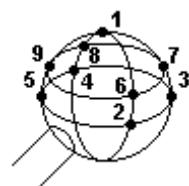
若要创建测量球体，必须至少采集四个测点。

- 采集点必须均匀地分布于曲面上。
- 前四个采集点不得位于同一个圆周上。
- 采的第一个点应在球体背部的轴极。

- 另外三个点取在同一圆周上。



带五个点的球示例



带九个点的球示例

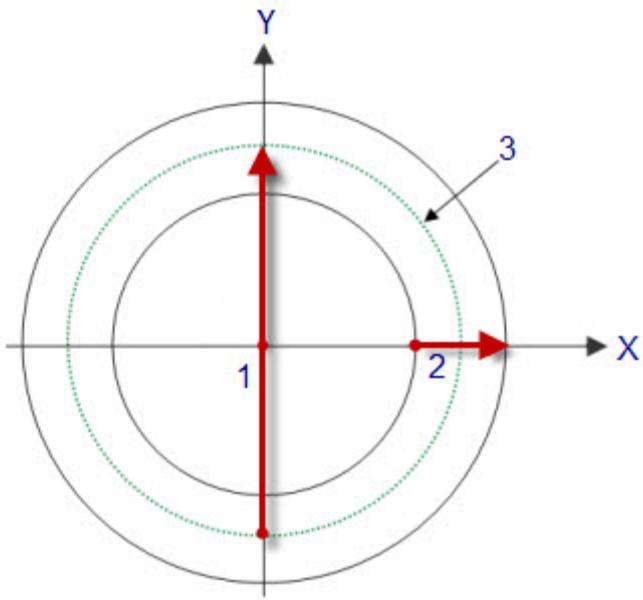
创建一个测量环



“环”按钮

使用环按钮可测量环特征的中心直径和环直径。所挑选点的重心位置也将被计算。

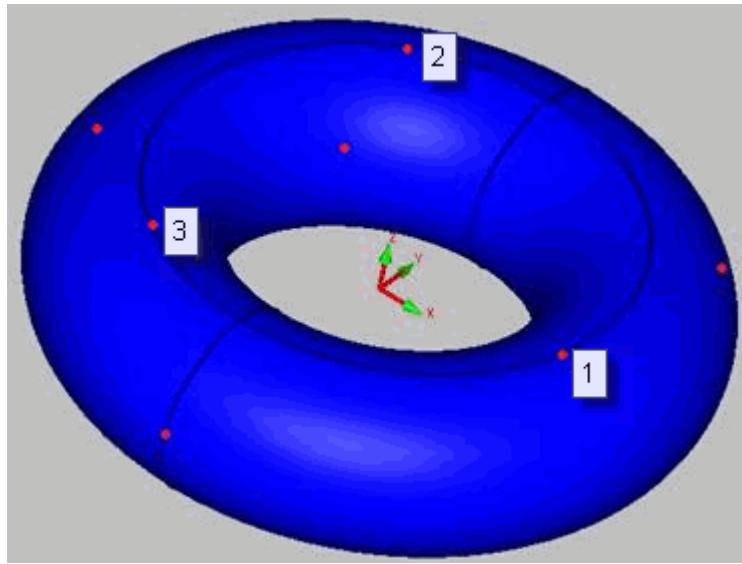
要创建一个测量环，必须至少采七个测点。在环中心线圆周的同一水平面上采前三个测点（见下图）。这些测点必须代表环的方向，以使通过这三个测点生成的假想圆的矢量与环的大致相同。



自上而下查看环。注意外直径 (1) , 内直径 (2) 和中心线圆 (3)。

如果定位了环，并从上面鸟瞰，Z+指向您，以逆时针方向采最初的三个点，使环的矢量为 $0,0,1$ 。如果顺时针采点，环的矢量为 $(0,0,-1)$ 。

用户可找出任何随意位置上剩下的四次触测的测头，只要它们不在同一平面。



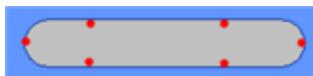
示例，对于带七个点的圆环，逆时针旋转前三个测点

创建测量圆槽



“圆槽”按钮

使用圆槽按钮可以创建测量圆槽。要创建一个被测量的圆槽，用户必须在槽上至少采六点，通常在竖直每侧采两点在圆弧上各采一点。或者，可以在每条圆弧上采三点。



带六个点的圆槽示例



两点

您也可从两个点创建测量槽。在测头的球体大小大于槽的直径，且无法采集所需测点时，这种方法十分有用。详细信息请参见 PC-DMIS Portable 文档。

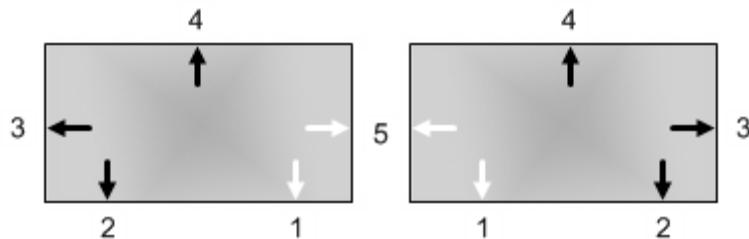
创建测量方槽



“方槽”按钮

使用方槽按钮可以创建测量方槽。

要创建测量方槽，用户必须在方槽上最少采五个测点，两个点在槽的长边上，其他的每个点分布在剩下的三条边上。这些点采集必须沿着顺时针 (CW) 或逆时针 (CCW) 方向。



带顺时针(左)和逆时针(右)方向的五个点的方槽示例



两点

您也可从两个点创建测量槽。在测头的球体大小大于槽的直径，且无法采集所需测点时，这种方法十分有用。详细信息请参见 PC-DMIS Portable 文档。

插入自动特征

若要将自动特征插入到测量程序中，则通过选择**插入 | 特征 | 自动**，并随后选择特征类型，以访问所需自动特征的**自动特征**对话框。或者可从**自动特征**工具栏选择该特征类型：



自动特征工具栏

在对话框打开状态下，创建特征的理想方法为在“图形显示”窗口中单击特征。PC-DMIS 将以直接从 CAD 模型采集的所需信息填充对话框。若不可访问 CAD 模型，则可直接在零件上触测测点。填写对话框后，单击对话框中的**创建**（或按下操纵盒上的“完成”）以将特征插入到“编辑”窗口中。

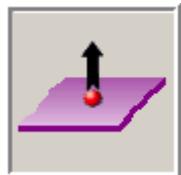
此文档集中不論述**自动特征**对话框及其选项。由于许多**自动特征**对话框选项对于 PC-DMIS 的不同配置是常见的，这些信息位于 PC-DMIS

核心文档中。有关自动特征对话框上选项的深入信息，请参见 PC-DMIS
核心文档中的“创建自动特征”一章。



对于所有内部或外部特征，请确保选择合适的特征类型：孔或外柱。

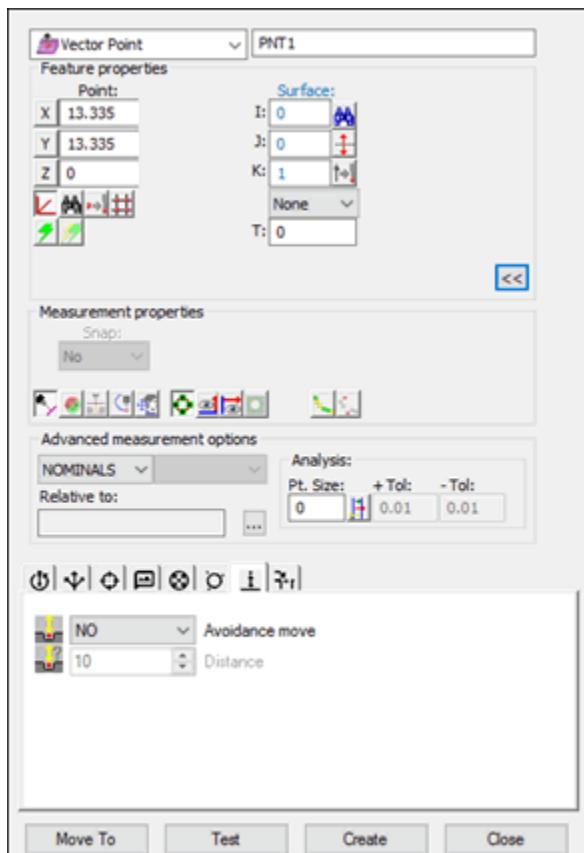
创建自动矢量点



“自动矢量点”按钮

通过“矢量点”自动选项，可定义标称点位置以及标称路径方向（CMM
用以测量定义的点）。

若要访问“矢量点”选项，则打开“矢量点”（**插入 | 特征 | 自动 | 点 |
矢量**）的自动特征对话框。



自动测量对话框 - 矢量点

此对话框打开后，视情况使用以下方法之一创建特征：

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成矢量点：

1. 将光标置于“图形显示”窗口中，以指示（曲面上）点的所需位置。
2. 单击曲面。PC-DMIS 会突出显示选择的曲面。
3. 确认选择了正确的曲面。PC-DMIS

将刺穿突出显示的曲面并显示所选点的位置和矢量。曲面法线矢量的方向系由测头可访问的零件的边确定。若可同等访问零件两边，则 PC-DMIS 会使用 CAD 数据的法线。翻转矢量图标可让您改变逼近方向。

4. 单击创建在测量程序中插入特征。如果在选择创建按钮之前检测到其他鼠标点击操作，则 PC-DMIS 将以新的数据覆盖先前的信息。

通过 CMM 使用曲面数据

若要以 CMM 使用曲面数据生成矢量点，则使用测头在零件所需曲面上触测。PC-DMIS 将刺穿距测头接触点最近的 CAD 曲面。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

- 若触测点实际位于曲面数据附近，未选择**立即测量开关**图标，且示教盒上的**完成**按钮处于按下状态，则 PC-DMIS 将创建点特征并随即添加到“编辑”窗口中。若触测点位于曲面数据附近，但**立即测量开关**图标处于选中状态，则 PC-DMIS 仍将使用曲面数据，但在单击**创建**之前，不会创建特征。
- 若触测点不在曲面数据附近，则 PC-DMIS 将触测视作实际的测点。同时，PC-DMIS 会显示测点位置和逼近矢量。
- 若在单击**创建**之前采集第二个测点，PC-DMIS 会使用第二个测点的位置数据。
- 若采集第三个测点，PC-DMIS 会使用三个测点确定逼近矢量。最后一个测点将用作位置。
- 若采集的测点超过三个，PC-DMIS 将使用除最后一个测点之外的所有测点来确定逼近矢量。PC-DMIS 将始终使用最后一个测点来确定位置。

使用屏幕上的线框数据

要使用线框 CAD 数据来生成矢量点：

1. 通过使用鼠标左键单击所需线，选择曲面的两条棱边（这些线应位于同一曲面）。（这些线应位于同一平面上。）PC-DMIS 会突出显示所选的线。

2. 确认选择了正确的线。
3. 在所创建的曲面上选择目标点。最终选择的这一点将射影到由两条线的矢量和第一条线的高所形成的平面上。

通过 CMM 使用线框数据

若要使用线框 CAD 数据来生成矢量点：



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

- 所采集的第一个测点指示 X、Y、Z 标称值。PC-DMIS 也显示 I、J、K 矢量。此值指示 CMM 路径矢量的相反方向（从该曲面指向外）。您可接受此数据，或可遵循消息框中显示的消息，请求其他测点。
- 第二次触测将使用最新的触测来更新触测位置和逼近矢量。
- 曲面上的第三次触测会将所显示的 X、Y、Z 标称值更改为当前触测位置。PC-DMIS 将利用三个测点制作一个平面，用以查找 I、J、K 逼近矢量。
- 任何其它触测都将用最新的触测信息来更新触测的位置。逼近矢量也将得到更新，以反映矢量点所有先前触测（不包括最新的触测）的平均。

在采集第一、第二或第三个测点之后的任何时候，您可接受所显示的数据。即便未接受第三个测点，PC-DMIS

将在内部重置系统，使得下一个测点（第四个测点）变为系列中的第一个测点。

不使用CAD数据

如果要在不使用 CAD 数据的情况下生成矢量点：

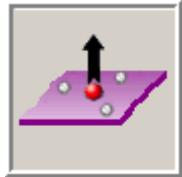
- 所采集的第一个测点指示 X、Y、Z 标称值。PC-DMIS 还会显示该测点的 I、J、K 逼近矢量。此值指示 CMM 路径矢量的相反方向（从该曲面指向外）。您可接受此数据，或可遵循消息框中显示的消息，请求其他测点。
- 第二次触测将使用最新的触测来更新触测位置和逼近矢量。
- 曲面上的第三次触测会将所显示的 X、Y、Z 标称值更改为当前触测位置。PC-DMIS 将利用三个测点制作一个平面，用以查找 I、J、K 逼近矢量。
- 任何其它触测都将用最新的触测信息来更新触测的位置。逼近矢量也将得到更新，以反映矢量点所有先前触测（不包括最新的触测）的平均。

键入数据

此方法允许您键入矢量点所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

创建自动曲面点

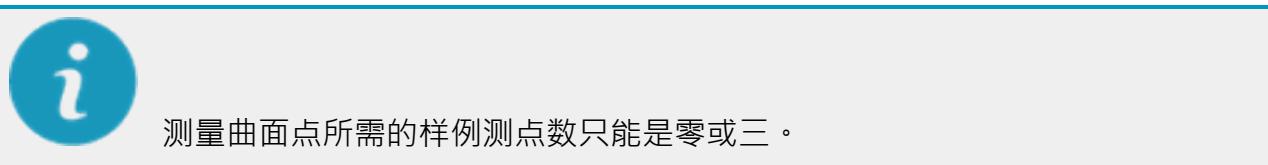


“自动曲面点”按钮

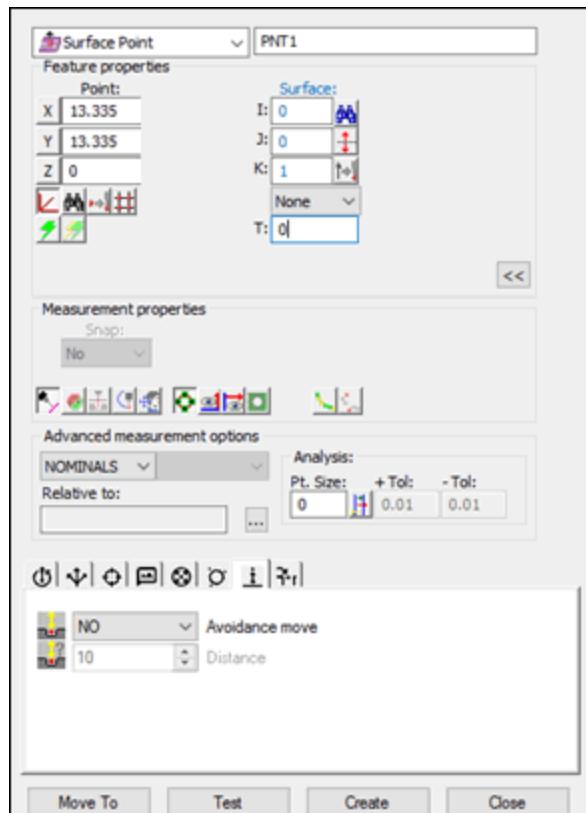
“曲面点”自动选项用于定义标称点位置以及 CMM

将用来测量所定义点的标称逼近方向。PC-DMIS

允许您定义多个点，这些点将用于围绕标称点位置周围测量平面以及平面的大小。一旦测量平面，PC-DMIS 将使用算出的平面曲面法线矢量以靠近标称点位置，以便于测量。



要访问“曲面点”选项，打开“曲面点”（**插入 | 特征 | 自动 | 点 | 曲面**）的自动特征对话框。



自动特征对话框 - 曲面点

此对话框打开后，视情况使用以下方法之一创建特征：

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成曲面点：

1. 点击**曲面模式**按钮。
2. 将光标置于“图形显示”窗口中，以指示（曲面上）点的所需位置。
3. 单击鼠标左键。PC-DMIS 会突出显示选择的曲面。

4. 确认选择了正确的曲面。PC-DMIS

将刺穿突出显示的曲面并显示所选点的位置和矢量。曲面法线矢量的方向系由测头可访问的零件的边确定。若可同等访问零件两边，则 PC-DMIS 会使用 CAD 数据的法线。翻转矢量图标可让您改变逼近方向。

5. 单击创建在测量程序中插入特征。如果在选择创建按钮之前，PC-DMIS 检测到其他鼠标单击操作，则 PC-DMIS 将以新的数据覆盖先前的信息。

通过 CMM 使用曲面数据

若要以 CMM 使用曲面数据生成曲面点，则使用测头在零件所需曲面上触测。PC-DMIS 会刺穿距测头触测位置最近的 CAD 曲面。

- 如果实际触测点接近曲面数据，并且测量复选框**没有被选中**，点特征将会立即被创建并且添加到编辑窗口中。
- 如果触测点在曲面数据附近，但是测量对话框**是被选中**，曲面数据将仍然被使用，但是特征将直到**创建按钮**单击之后才会被创建。
- 若触测点**不在曲面数据附近**，则 PC-DMIS 将触测视作实际的测点，显示测点位置和逼近矢量。
- 若在**单击创建按钮之前**采集第二个测点，PC-DMIS 会使用第二个测点的位置数据。
- 若采集第三个测点，PC-DMIS 会使用三个测点确定逼近矢量。最后一个测点将用作位置。
- 若采集的测点超过三个，PC-DMIS 会使用除最后一个测点之外的所有测点来确定逼近矢量。PC-DMIS 将始终使用最后一个测点来确定位置。

使用屏幕上的线框数据

要使用线框 CAD 数据来生成曲面点：

1. 通过使用鼠标左键单击所需线，选择曲面的两条棱边（这些线应位于同一曲面）。
(这些线应位于同一平面上。) PC-DMIS 会突出显示所选的线。
2. 确认选择了正确的线。屏幕上将出现消息框：
3. 在所创建的曲面上选择目标点。最后的选择将投影到由两个线矢量和第一条线的高度形成的平面中。

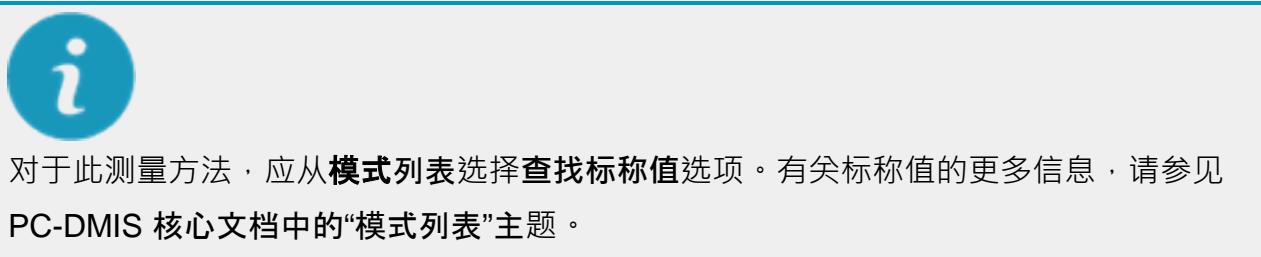
通过 CMM 使用线框数据

如果将使用线框 CAD 数据生成曲面点：

- 所采集的第一个测点指示 X、Y、Z 标称值。PC-DMIS 也显示 I、J、K 矢量。此值指示 CMM 路径矢量的相反方向（从该曲面指向外）。您可接受此数据，或可遵循消息框中显示的消息（请求其他测点）。第二个测点会更新测点位置和使用最近的测点的逼近矢量。
- 曲面上第三个测点将所显示的 X、Y、Z 标称值更改为当前的测点位置。PC-DMIS 将从这三个测点中绘制平面，以找到 I、J、K 逼近矢量。
- 任何其他测点将更新使用最近的测点信息的测点位置。同时将更新逼近矢量以反映曲面点的所有先前测点的平均值（不包括最近的测点）。

在采集第一、第二或第三个测点之后的任何时候，您可接受所显示的数据。即便未接受第三个测点，PC-DMIS

将在内部重置系统，使得下一个测点（第四个测点）变为系列中的第一个测点。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

不使用CAD数据

若要生成曲面点而不使用 CAD 数据：

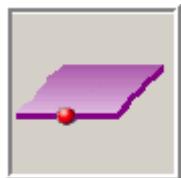
- 所采集的第一个测点指示 X、Y、Z 标称值。PC-DMIS 也显示 I、J、K 矢量。此值指示 CMM 路径矢量的相反方向（从该曲面指向外）。您可接受此数据，或可遵循消息框中显示的消息（请求其他测点）。
- 第二个测点会更新测点位置和使用最近的测点的逼近矢量。
- 曲面上第三个测点将所显示的 X、Y、Z 标称值更改为当前的测点位置。PC-DMIS 将从这三个测点中绘制平面，以找到 I、J、K 逼近矢量。
- 任何其他测点将更新使用最近的测点信息的测点位置。逼近矢量也会得到更新以反映曲面点的所有先前测点的平均值（不包括最近的测点）。

键入数据

通过此方法，可为此曲面点键入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

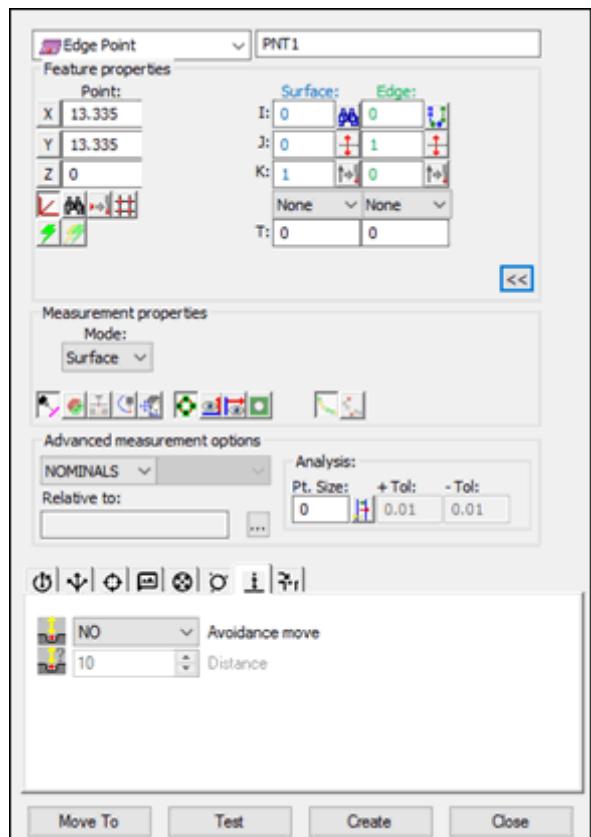
创建自动棱点



“自动棱点”按钮

棱点自动选项用于定义将在零件的棱上进行的点测量。当零件材料非常薄，以致需要精确控制的CMM测量触测时，此测量类型尤其有用。保证正确测量棱点需要测量五个样例点。

要访问“棱点”选项，请打开棱点（**插入 | 特征 | 自动 | 点 | 棱点**）的自动特征对话框。



自动特征对话框 - 棱点

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征：

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成棱点：

1. 点击**曲面模式**按钮。
2. 使用鼠标，在用户想创建自动棱点的位置的边缘的表面点击一次。
3. 确认选择了正确曲面。一旦指定了点，对话框将显示所选棱点和矢量的值。曲面法线矢量的方向系由测头可访问的零件的边确定。如果可以接触零件的两条边，则使用 CAD 数据中的法线矢量。**翻转矢量**图标可以让用户改变逼近方向。
4. 单击**创建**在测量程序中插入特征。如果在单击**创建**按钮之前又有其他鼠标点击被发现，那么 PC-DMIS 将会用新的数据来覆盖之前显示的信息。

通过 CMM 使用曲面数据

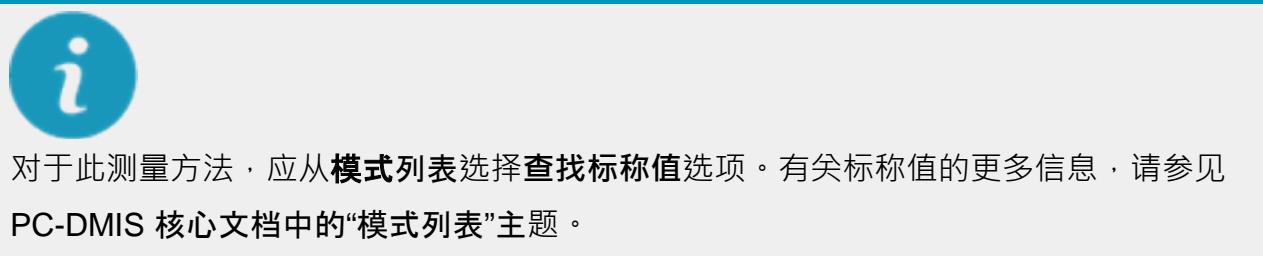
在CMM中，要使用曲面数据生成棱点：

1. 用测头在零件预期棱的附近进行接触。
2. 使柱测尖尽可能垂直于曲面。

PC-DMIS 将刺穿距测头触测位置最近的 CAD 曲面。所显示的 X、Y 和 Z 值反映距测点最近的 CAD 棱，而非实际的测点。I、J、K 值反映曲面法线矢量。

如果未找到CAD棱，PC-DMIS将显示最接近的点并询问是否进行更多触测。

如果在单击创建之前在相反的曲面上进行第二次触测，PC-DMIS 将把位置值改成合适的新值。但所显示的矢量将仍然保持不变。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

您也可使用线框 CAD 数据生成棱点。

要生成棱点：

1. 在棱边上预期线的附近（不在顶曲面的边界内）点击。PC-DMIS 突出显示选择的线。
2. 验证所选择正确的特征。

测头逼近方向始终垂直于该线，同时垂直于当前测头中心线矢量。测头将从所单击的棱边逼近。一旦指定了线，对话框将显示所选棱点和矢量的值。

如果必须再进行接触，点击（法线）曲面的相对线。

通过 CMM 使用线框数据

要使用CMM的线框数据生成棱点：

1. 用测头在零件预期棱的附近进行接触。
2. 使柱测尖尽可能垂直于曲面。

PC-

DMIS将刺穿与测头接触点最接近的CAD线。所显示的X,Y,Z值反映与触测最接近的CAD棱，而不是实际测点。I,J,K反映曲面法线矢量。如果未找到CAD棱，PC-DMIS将显示最接近的点并询问是否进行更多触测。

如果在单击创建之前在相反的曲面上进行第二次触测，PC-DMIS将把位置值改成合适的新值。但所显示的矢量将仍然保持不变。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS核心文档中的“**模式列表**”主题。

不使用CAD数据

如果要在不使用CAD数据的情况下生成棱点：

- 所进行的前三次触测将指示曲面矢量标称值。
- 接着的两次触测将查找并显示另一矢量。该值表示CMM逼近矢量的相反方向（从曲面向外）。
- 最后一次触测（第六次触测）将指示实际的棱点位置。

键入数据

此方法允许您键入棱点所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

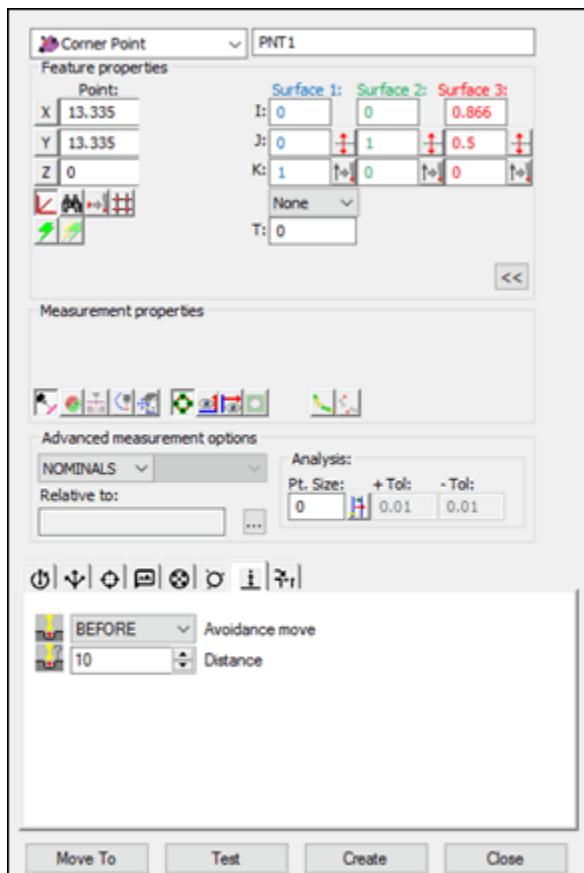
创建自动隅角点



“自动隅角点”按钮

“隅角点”自动选项用于定义对三个测量平面交点的测量。利用该测量类型可测量三个平面的交点，而不用分别测量这三个平面并构造一个交点。而测量隅角点，必须使用九个测点（三个平面各三个测点）。

要访问 隅角点选项，需进入**自动特征隅角点对话框 (插入 |特征| 自动 |点| 隅角)**。



自动特征对话框 - 隅角点

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成一个隅角点：

1. 点击**曲面模式**按钮。
2. 使用鼠标，在隅角附近点击一次。用户将会发现PC-DMIS自动将活动测头重新定位在隅角点上。
3. 验证选择了正确的隅角点。一旦指定了点，对话框将显示所选隅角点和矢量的值。
4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
5. 单击**创建**。

通过 CMM 使用曲面数据

在CMM中，要使用曲面数据生成隅角点：

1. 在汇聚在隅角的三个曲面中的每一个曲面上接触一次。PC-DMIS则假定这些曲面相互垂直。
2. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
3. 单击创建。

如未找到CAD隅角点，PC-DMIS将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

线框CAD数据也可用于生成隅角点。

要生成该点需：

1. 使用鼠标，在该点附近点击一次。（但不是该点上）PC-DMIS将突出显示所选曲面。
2. 验证选择了正确的曲面。一旦指定了点，对话框将显示所选隅角点和矢量的值。（必要的话，接触形成隅角的另一条棱。）
3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
4. 单击创建。

通过 CMM 使用线框数据

要在CMM中使用线框数据生成一个隅角点：

1. 在第一个曲面上接触两次。
2. 在汇聚于隅角的棱附近接触一次。PC-
DMIS假定这些曲面互相垂直。如未找到CAD隅角点，PC-
DMIS将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。
3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
4. 单击创建。



不使用CAD数据

要在不使用CAD数据的情况下生成一个隅角点：

1. 在第一个曲面上接触三次。
2. 在第二个曲面上接触两次。
3. 在第三个曲面上接触一次。
4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
5. 单击创建。

键入数据

此方法允许您键入隅角点所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

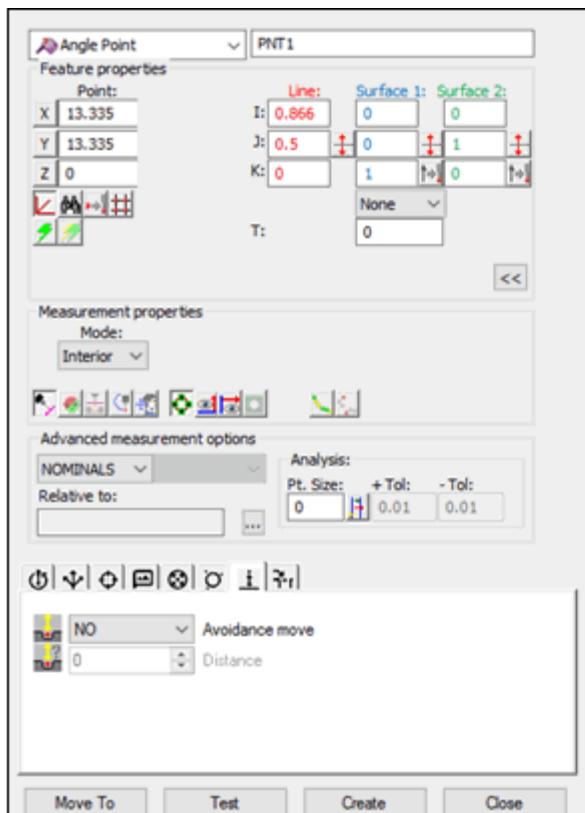
创建自动角度点



“自动角点”按钮

通过“角点”自动选项，可定义点测量（两条测量线的交点）。通过此测量类型，可测量两条线的交点，而无须分别测量两条线并构造交点。准确测量一个角度点需要六个测点。

访问角度点选项，需进入**自动特征里的角度点对话框**（**插入|特征|自动|点|角度**）。



自动测量对话框 - 角度点

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成角度点，请执行以下步骤：

1. 点击**曲面模式**图标。
2. 使用鼠标，在“图形显示”窗口中的角度棱边附近（不是在其上）单击一下。PC-DMIS 将突出显示所选的曲面。
3. 验证选择了正确的曲面。一旦指定了点，对话框将显示所选角度与矢量的值。曲面法线矢量的方向取决于零件上测头可接触的便。如果可以接触零件的两条边，则使用 CAD 数据中的法线矢量。**翻转矢量**图标可以让用户改变逼近方向。
4. 单击**创建**在测量例程中插入特征。如果在单击**创建**之前又有其他鼠标点击被发现，那么 PC-DMIS 将会用新的数据来覆盖之前显示的信息。如果必须再进行接触，请单击角度棱的相对曲面。

通过 CMM 使用曲面数据

在 CMM

中，要使用曲面数据生成角度点，请在角度棱的每条边上各接触一次。如果未找到 CAD 角度点，PC-DMIS 将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

线框 CAD 数据也可用于生成角度点。

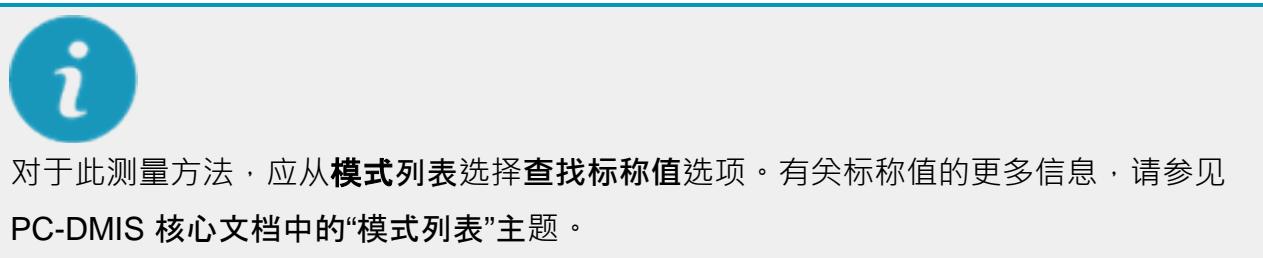
要生成特征点，请执行以下步骤：

1. 使用鼠标，在角点边缘（不是上方）点击一下。PC-DMIS 将突出显示所选曲面。
2. 验证选择了正确的曲面。一旦指定了点，对话框将显示所选角度与矢量的值。曲面法线矢量的方向取决于零件上测头可接触的便。如果可以接触零件的两条边，则使用 CAD 数据中的法线矢量。**翻转矢量** 图标可以让用户改变逼近方向。
3. 单击**创建**在测量程序中插入特征。若在单击**创建**按钮前进行了其他点击，PC-DMIS 将把先前的信息覆盖为新数据。如果必须再进行接触，请单击角度棱的相对曲面。

通过 CMM 使用 线框数据创建特征

在 CMM

中，要使用线框数据生成角度点，请在角度棱的每条边上各接触一次。如果未找到 CAD 角度点，PC-DMIS 将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。



不使用CAD数据

如果要在不使用 CAD 数据的情况下生成角度点，请在每个曲面上接触三次，以查找两个平面。所显示的角度点将位于第一个触测位置。

键入数据

此方法允许您键入角度点所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击**创建**在测量程序中插入特征。

创建自动最高点



“自动最高点”按钮

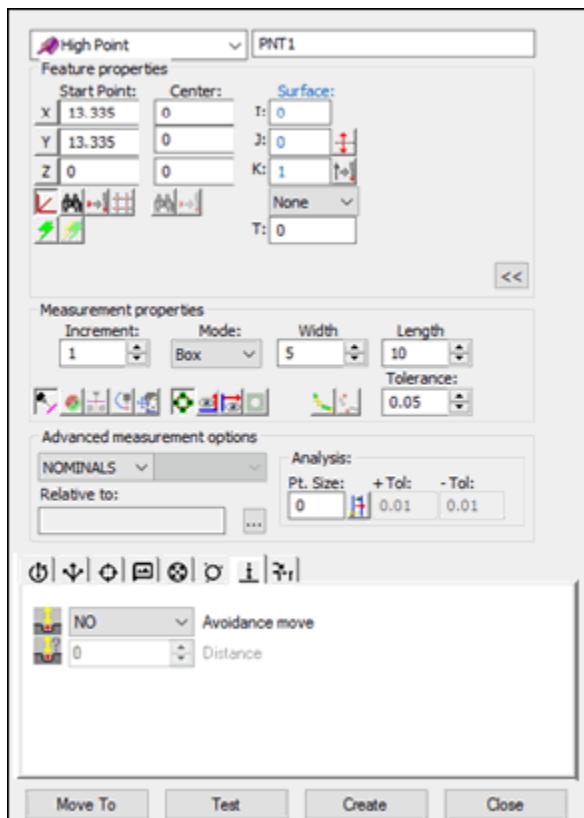
使用高点自动选项可搜索用户定义的搜索区域，以定位当前工作平面中的最高点。此是最高点区域示例。它不搜索测量例程中的现有点。

高点执行详细信息：

- PC-DMIS 将会从起始点开始搜索。
- PC-DMIS 将以增量值中指定的距离围绕起点采集八个样例测点。
- 若找到更高的点，则其变成新的起点，且 PC-DMIS 将再次围绕该点采集八个样例测点。此操作继续直至 PC-DMIS 在增量距离处不再找到更高的点。
- 随后 PC-DMIS 在减小增量值的同时，继续采集样例测点，直至增量值符合公差值。藉此完成高点搜索。
- 一旦搜索结束，PC-DMIS 通过移动点ID到找到的搜索区域内的高点位置而在 CAD 模型上显示新的高点值。

搜索结果为由 X、Y、Z 坐标和路径矢量定义的单个点。

要访问高点选项，需访问高点的**自动特征对话框（插入 | 特征 | 自动| 点 | 高）**。



自动特征对话框 - 高点

此对话框打开后，视情况使用以下方法之一创建特征：

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据定义最高点搜索区域：

1. 将光标置于“图形显示”窗口中，以指示（曲面上）起点的所需位置。
2. 单击一下来定义搜索区域的**中心及起点**。PC-DMIS将突出显示所选曲面。
3. 再点击一次来定义**起点**。只要对话框开启，在零件模式的曲面上每奇数次点击将定义与被点击位置相同的**中心与起点**。每偶数此点击将仅定义新的**起点**。
4. 验证选择了正确的曲面。PC-

DMIS将刺穿突出显示的曲面并显示所选点的位置和矢量。曲面法线矢量的方向取决于零件上测头可接触的便。如果可以接触零件的两条边，则使用 CAD 数据中的法线矢量。**翻转矢量图标**可让用户改变逼近方向。

5. 从测量特征区域中的**模式列表**中选择圆或框来选择使用的搜索区域的类型。
6. 对于方框类型搜索区域，通过更改宽度和长度框中的值来定义搜索区域的**大小**，对于圆形类型搜索区域，通过更改**内径**和**外径**框中的值来定义搜索区域的大小。PC-DMIS 将突出显示搜索区域。
7. 为要使用的高点过程定义增量和公差值。
8. 根据需要在对话框上进行任何其他更改。
9. 单击**创建**在测量程序中插入特征。执行测量例程时，PC-DMIS 将搜索，并随后返回所定义的搜索区域中的最高点。

通过 CMM 使用曲面数据

在 CMM 中，要定义最高点的搜索区域，请执行以下步骤：

1. 用测头接触一次零件的预期曲面。将搜索区域的中心和起点定义为相同的值。
2. 如果需要不同的搜索中心，用测头在预期曲面上再接触一次。这将为搜索区域定义新的中心。如果用测头对另一点采样，则将更改起点和逼近矢量的位置。每次连续的采样都将在搜索中心和起点之间交替。每当测头在零件的曲面上采样时，PC-DMIS 将刺穿与测头接触点最接近的 CAD 曲面。从曲面模型收集到的这一信息将用于定义起点和搜索中心。
3. 从测量特征区域中的**模式列表**中选择圆或框来选择使用的搜索区域的类型。
4. 对于方框类型搜索区域，通过更改宽度和长度框中的值来定义搜索区域的大小，对于圆形类型搜索区域，通过更改**内径**和**外径**框中的值来定义搜索区域的大小。PC-DMIS 将突出显示搜索区域。
5. 为要使用的高点过程定义增量和公差值。
6. 根据需要在对话框上进行任何其他更改。
7. 单击**创建**在测量例程中插入特征。执行测量例程时，PC-DMIS 将搜索，并随后返回所定义的搜索区域中的最高点。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

不使用CAD数据

若要不使用 CAD

数据而为高点生成搜索中心，则采集的第一个测点将指示起点和搜索中心的 X、Y、Z 标称值。PC-DMIS 还将显示该测点的 I、J、K 路径矢量。此值指示 CMM 路径矢量的相反方向（从该曲面指向外）。若要定义一个新起点，则使用测头在所需中心点位置对曲面进行取样。连续的取样将在起点和搜索中心之间切换。

1. 从**测量特征区域**中的**模式列表**中选择**圆或框**来选择使用的搜索区域的类型。
2. 对于方框类型搜索区域，通过更改**宽度**和**长度**框中的值来定义搜索区域的大小，对于圆形类型搜索区域，通过更改**内径**和**外径**框中的值来定义搜索区域的大小。PC-DMIS 将突出显示搜索区域。
3. 为要使用的高点过程定义增量和公差值。
4. 根据需要在对话框上进行任何其他更改。
5. 单击**创建**在测量例程中插入特征。执行测量例程时，PC-DMIS 将搜索，并随后返回所定义的搜索区域中的最高点。

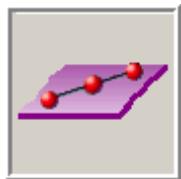
键入数据

通过此方法，可通过提供 X、Y 和 Z 值而键入高点搜索区域的中心（即方框中间或圆心）。还可通过输入 X、Y、Z、I、J 和 K 值来定义起点和相关的路径矢量。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J 和 K 值。
2. 从**测量特征区域**中的**模式列表**中选择**圆或框**来选择使用的搜索区域的类型。

3. 对于方框类型搜索区域，通过更改**宽度**和**长度**框中的值来定义搜索区域的大小，对于圆形类型搜索区域，通过更改**内径**和**外径**框中的值来定义搜索区域的大小。PC-DMIS 将突出显示搜索区域。
4. 为要使用的高点过程定义增量和公差值。
5. 根据需要在对话框上进行任何其他更改。
6. 单击**创建**在测量例程中插入特征。执行测量例程时，PC-DMIS 将搜索，并随后返回所定义的搜索区域中的最高点。

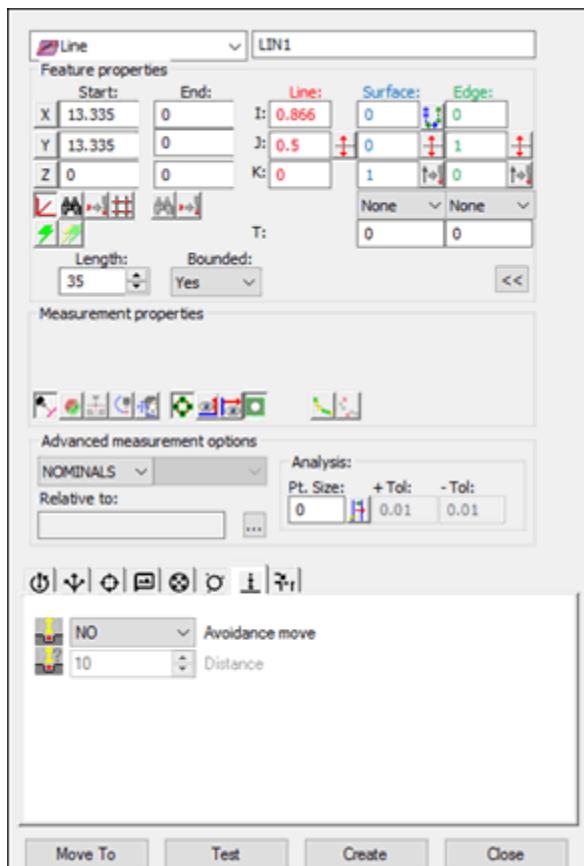
创建自动锥体



“自动线”按钮

直线自动选项允许用户定义 CMM 测量定义直线所用的法线。

要访问直线选项，需访问**自动特征直线**对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 直线**）。



自动特征对话框 - 直线

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要在屏幕上的曲面数据生成自动直线：

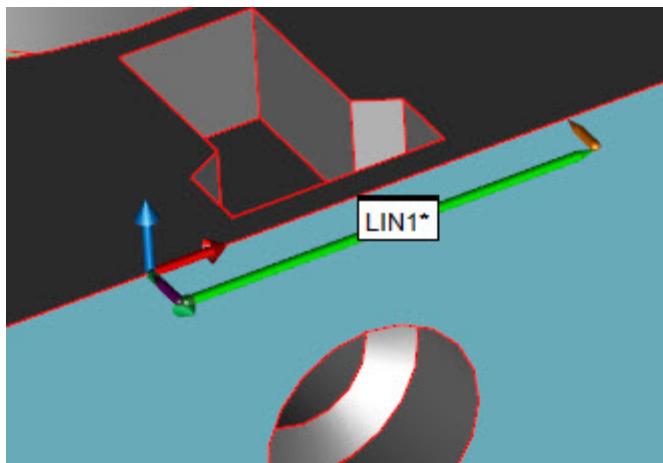
1. 从**边界**列表中选择**是**或

否。边界线若遇到另一个定义的点则终止。无边界的线根据定义的长度而终止。

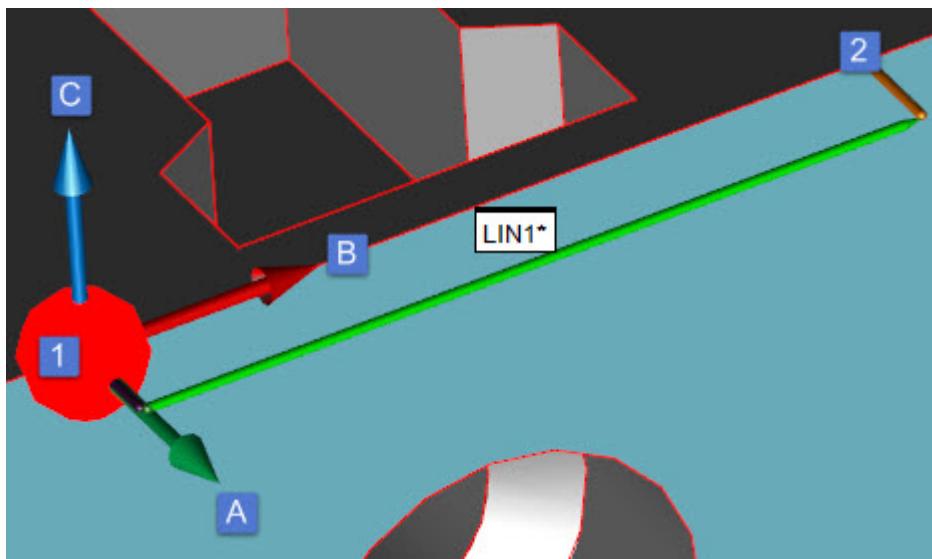
2. 定义自动直线：

- 如果用户选择**边界**列表里的是，在期望曲面上点击两下分别定义直线的起始点和终止点。PC-DMIS将会捕捉到最近的与其他曲面的交点，在交线上放置交点。PC-DMIS将会绘制起始点位置，终止点位置，以及线和棱矢量。

- 若从边界列表选择否，则单击所需曲面，以定义线的起点。PC-DMIS 将捕捉距与另一曲面相交处最近的点，将此点沿交线放置。随后，通过在长度框中输入长度来定义线的长度。PC-DMIS 将绘制起始点位置以及符合该长度的线。如果点大小值大于 0，则将绘制较大的线和边缘矢量。



显示起点和终点的有界自动线示例

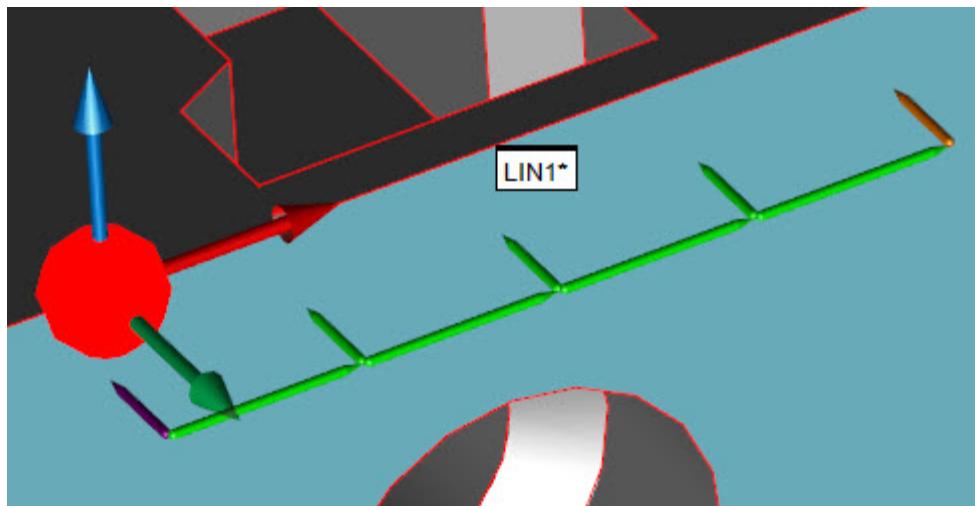


这一样本边界自动直线显示起始与结束点 (1) 与 (2) ; 棱矢量 $0,-1,0$ (A), 线矢量 $1,0,0$ (B), 曲面矢量 $0,0,1$ (C), 点大小值 4 :

3. 在对话框中更改其它需要的选项。

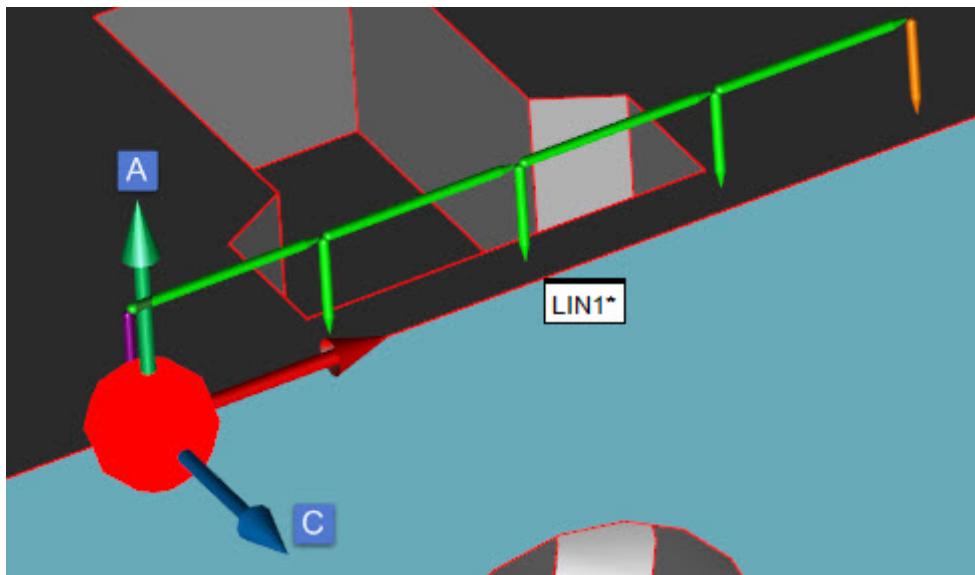
4. 在测头工具栏的**接触路径属性**选项卡中更改所需的任何一项。

例如，如果用户想改变测点的值以及深度值：



现在自动线带五个测点，深度为 3 mm

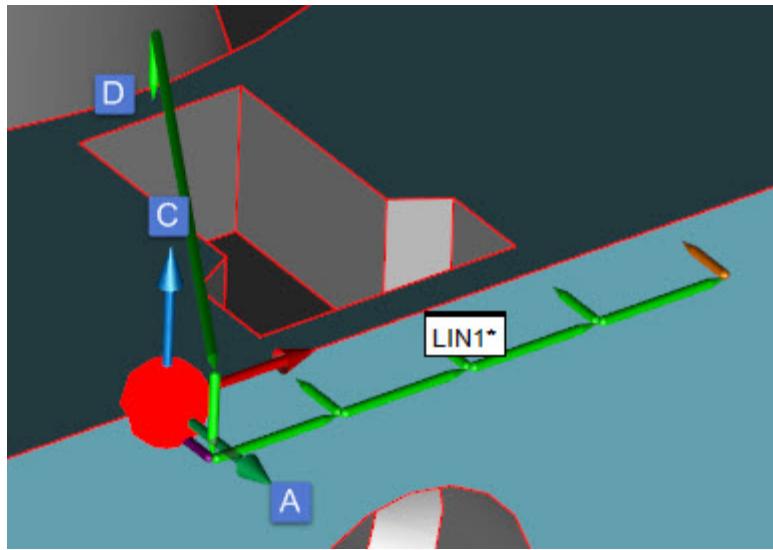
或者，用户也许想要通过修改**棱矢量**来使直线沿着其他曲面的方向进行测量：



带修改后棱矢量 $0,0,1$ (A)、修改后曲面矢量 $0,-1,-0$ (C) 和深度 1 mm 的自动线

5. 若您需要样本测点，按需修改测头工具栏的**接触样本测点属性**选项卡中的各项。

比如，若用户需要从棱那里取得曲面材料偏置的样本，可进行类似查找：



此示例显示带边缘矢量 $0,-1,0$ (A)、曲面矢量 $0,0,1$ (C)、深度 1 mm 和 1 个样例测点 (使用缩进 $2/19\text{ mm}$ (D)) 的自动线

6. 单击创建。PC-DMIS生成自动直线。

使用屏幕上的线框数据

将屏幕上的线框数据用于生成直线：

1. 从边界列表中选择 是 或 否。
2. 通过在期望线上点击鼠标左键选择目标点所在 (除非是由第二个点确定边界，否则点击一次即可) 曲面的两个边界(线)。这些线应该在同一个曲面上。
3. PC-
DMIS将绘制起始位置，如果创建了边界线，以及终止点的位置。还会画出直线以及边界点的矢量。
4. 验证选择了正确的线。
5. 如果需要可以对对话框中的任何其他选项以及测头工具栏中的触测路径进行修改。
6. 单击创建。PC-DMIS生成直线。

通过 CMM 使用线框数据

要使用线框数据生成直线：

- 得到的第一个测点将会显示出起始点的 X, Y, Z 理论值。第二个测点（若在边界列表选择是则必需）将会生成直线的终点。在第二个测点之后，PC-DMIS 将也会显示 I,J,K 线矢量以及 I,J,K 边界矢量的。
- 任何其他的测点将会在直线上平均分布。逼近矢量也将得到更新，以反映矢量点所有先前触测（不包括最新的触测）的平均。

在第二次触测后，可以随时接受所显示的数据。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

不使用CAD数据

如果要在不使用 CAD 数据的情况下生成直线：

1. 从**边界列表**中选择**是或否**。
2. 如果你创建了一个定界线，测量两个点。如果用户创建了一个非定界线，测量一个点。
3. 如果需要的话可以改变对话框里任何其他的选项以及**测头工具栏的触发路径属性**选项卡。
4. 单击**创建**。

键入数据

这种方法允许用户键入创建自动直线所需的数值。

要创建边界线：

1. 在**边界列表**中选择**是**
2. 在**测点**对话框里输入测点的数量。
3. 在**测头工具栏**中的**触发特征**选项卡里的**深度**对话框中输入直线的深度值。
4. 输入**起始点**和**终止点**的 X,Y,Z 值。
5. 输入 I, J, K 矢量。
6. 如果需要的话填写对话框中其他的选项。
7. 单击**创建**。PC-DMIS 将会根据用户在对话框里输入的值生成一条直线。

要创建非边界线：

1. 在**边界列表**中选择**否**。
2. 在**测点**对话框里输入测点的数量。
3. 在**测头工具栏**中的**触发特征**选项卡里的**深度**对话框中输入直线的深度值。
4. 输入**起始点**的 X,Y,Z 值。
5. 输入 I, J, K 矢量。
6. 在**长度**对话框里输入直线长度。
7. 如果需要的话填写对话框中其他的选项。
8. 单击**创建**。PC-DMIS 将会根据用户在对话框里键入的值生成一条直线。

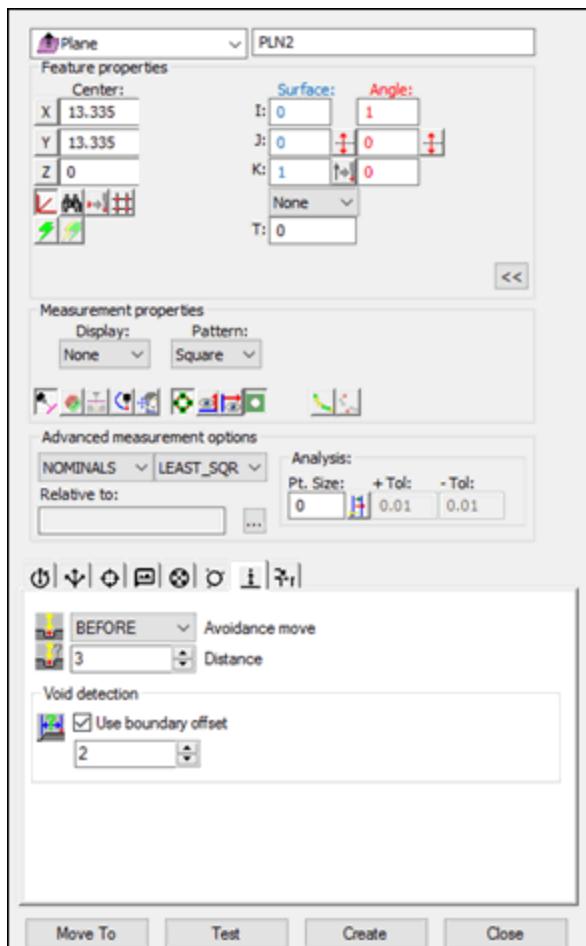
创建自动平面



“自动平面”按钮

平面自动选项用于定义平面测量。要测量一个平面，必须至少使用三个测点。

若要访问“平面”选项，则访问“平面”（插入 | 特征 | 自动 | 平面）的自动特征对话框。



自动特征对话框 - 平面

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成方槽：

1. 点击**曲面模式**按钮。
2. 使用鼠标，在用户需要的平面所在曲面点击一下。PC-DMIS将会从模型上收集到的信息填入到对话框中。
3. 根据所需对电话框做任何其他修改。
4. 单击**创建**。

使用屏幕上的线框数据

线框 CAD 数据也可用于生成自动平面。

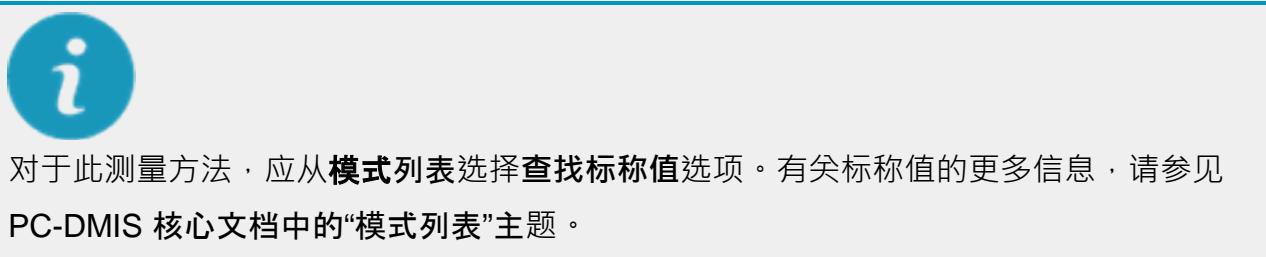
要生成平面：

1. 进入自动特征**平面对话框**（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）。
2. 在曲面上至少点击三次。
3. 验证选择了正确的特征。测头逼近方向总是与特征垂直，同时也与当前测头中心线矢量垂直。对话框将显示平面的中心点以及矢量的值。
4. **如果需要的话可以对对话框及测头工具栏中的触测路径特征选择卡进行任何其他修改。**
5. 单击**创建**。

通过 CMM 使用线框数据

要使用CMM的线框数据生成平面：

1. 进入自动特征**平面对话框**（**插入 | 特征 | 自动 | 平面**）。
2. 在用户想创建平面的曲面上采一个点。PC-DMIS将刺穿与测头接触点最接近的 CAD 曲面。所显示的X,Y,Z值代表了平面的中心值。I、J、K 反映曲面法线矢量。
3. **如果需要的话可以对对话框中的其他任何选项以及测头工具栏中的触测路径选项进行修改。**
4. 按示教盒上的**完成按钮**（或者按一下对话框中的**创建按钮**）。



不使用CAD数据

要在不使用 CAD 数据的情况下生成平面：

1. 进入自动特征**平面对话框** (**插入 | 特征 | 自动 | 平面**)。
2. 在曲面上至少测量三点。
3. 如果需要的话增加额外的测点。PC-DMIS将使用所有测定点中的数据。显示的X,Y,Z是计算出来的平面的中心。
4. 如果需要的话可以对对话框及测头工具栏中的触测路径特征选择卡进行任何其他修改。
5. 单击**创建按钮**。

键入数据

这种方法允许用户键入平面所需的 X、Y、Z、I、J、K 中心值。

1. 进入自动特征**平面对话框** (**插入 | 特征 | 自动 | 平面**)。
2. 输入 X、Y、Z、I、J、K 值。
3. 在测头工具箱的**触测属性**选项卡上输入测点数和层数值。
4. 在**自动特征对话框**以及测头工具栏中进行其他的修改。
5. 单击**创建**。

然后PC-DMIS将会使用标准样式生成合适数量的触测点。

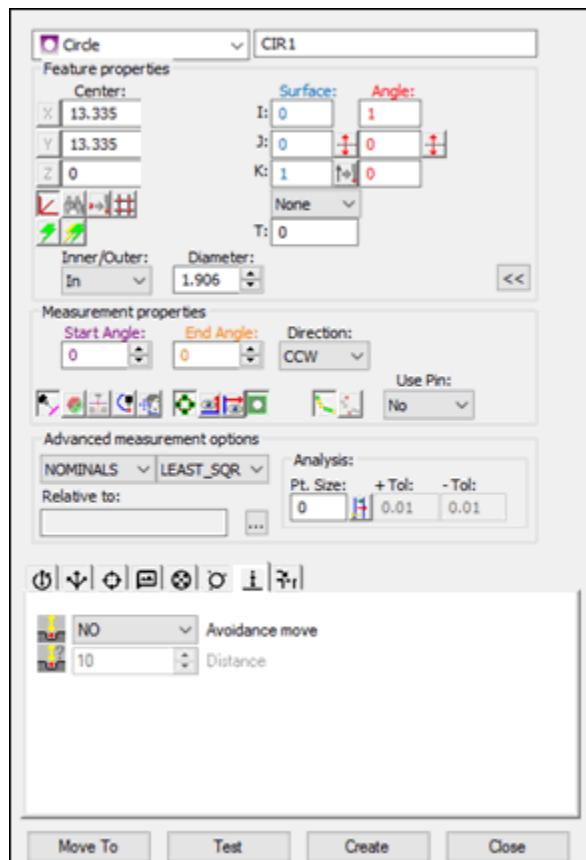
创建自动圆



“自动圆”按钮

“圆”自动选项用于定义圆测量。当圆位于不平行任何工作平面的特定平面，或者需要为部分圆进行间隔均匀的采点时，此测量类型尤其有用。测量圆至少需要三个点。默认的触测点数可以在设置模式中更改。

要访问圆选项，需访问**自动特征对话框中的圆（插入 | 特征 | 自动 | 圆）**。



自动测量对话框 - 圆

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征：

使用屏幕上的曲面数据

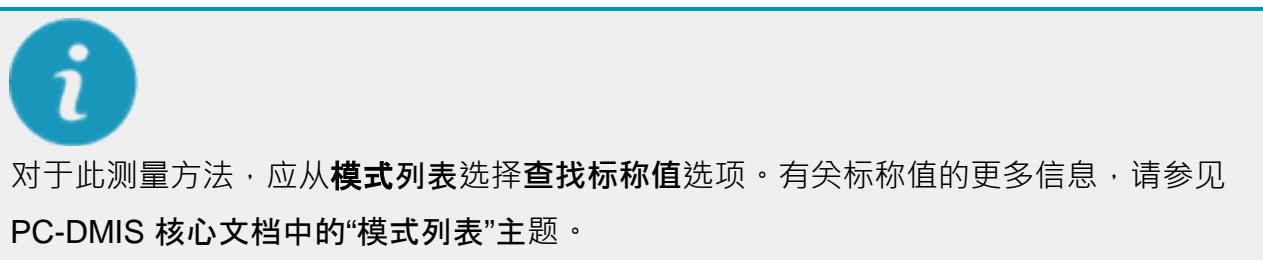
要使用曲面数据生成薄壁件圆，请执行以下步骤：

1. 点击**曲面模式按钮**。

2. 在目标圆的外面或者里面点击一下。对话框将会显示从CAD上捕捉到的数据有关被选择的圆的中心点坐标以及直径此圆是捕捉到的距离你点击CAD表面最近的圆。
3. 在对话框里做其他任何你需要的修改。
4. 单击创建。

通过 CMM 使用曲面数据

在 CMM 中，要使用曲面数据生成圆，应至少在孔中或键上采三个点。PC-DMIS 将刺穿与测头接触点最接近的 CAD 曲面。所显示的 X、Y、Z 值反映最接近的 CAD 圆（而不是实际测点）。I、J、K 反映曲面法线矢量。如果未找到 CAD 圆，PC-DMIS 将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

线框 CAD 数据也可用于生成自动圆。

生成圆：

1. 在圆上的预期位置附近单击。PC-DMIS 将会把最接近你选中的模型部分的圆捕捉出来突出显示被选中的圆。
2. 验证选择了正确的特征。测头触测方向永远是垂直于特征方向，也垂直于当前测头中心线矢量。一旦指定了线，对话框将显示所选圆的中心点和直径的值。
3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
4. 单击创建。



如果基础 CAD

元素不是圆或弧，则可能需要更多次单击才能将特征确定。如果 PC-DMIS 未突出显示正确的特征，请在圆上至少再单击两个位置。

不使用CAD数据

要在不使用 CAD 数据的情况下生成圆，请执行以下步骤：

1. 在曲面上采三个点，以查找圆所在的平面。
2. 在孔里（或键上）触测三次。PC-DMIS 将使用所有三个测点来计算自动圆。还可以再采一些点。PC-DMIS 将使用所有测定测点的数据，直至单击**创建按钮**。所显示的 X, Y, Z 值是计算所得的圆（或键）中心。
3. 如果需要的话可以对对话框及测头工具栏中的触测路径特征选择卡进行任何其他修改。
4. 单击**创建**。

键入数据

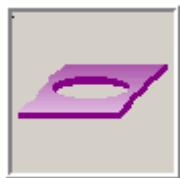
这种方法允许用户键入圆所需的 X、Y、Z、I、J、K 中心值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击**创建**在测量程序中插入特征。

计量扫描校准

“圆”自动选项提供计量扫描校准策略来校准与计量扫描筛选器一起使用的测头测尖。有关更多信息，请参见“**使用计量扫描校准策略**”。

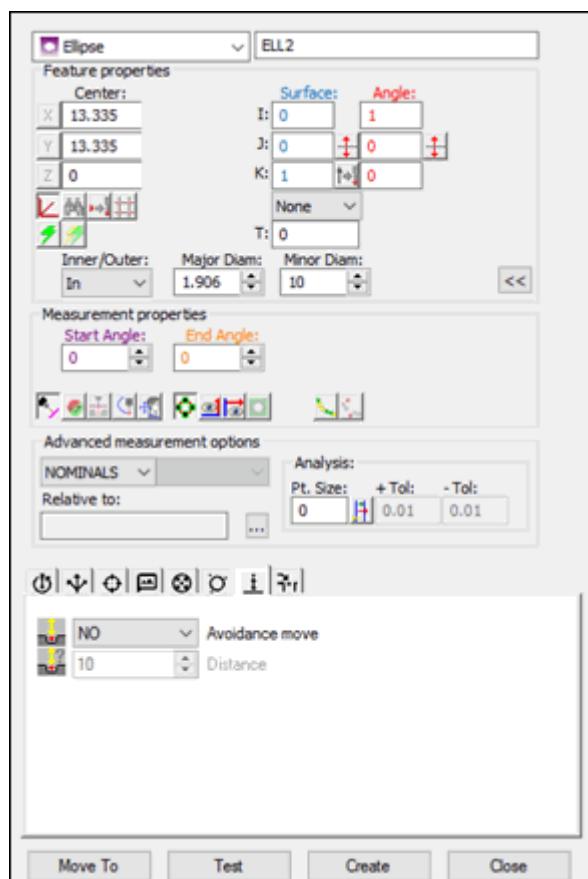
创建自动椭圆



“自动椭圆”按钮

通过“椭圆”自动选项可定义椭圆。椭圆特征类型的工作方式非常类似于薄壁件圆特征。当椭圆位于不与工作平面中任一者平行的特定平面中时，此类型尤其有用。若对于部分椭圆要求测点间距相等，则也有用。测量椭圆最少需要五个测点。

要访问椭圆选项，需访问**自动特征对话框**中的椭圆（**插入 | 特征 | 自动 | 椭圆**）。



自动特征对话框 - 椭圆

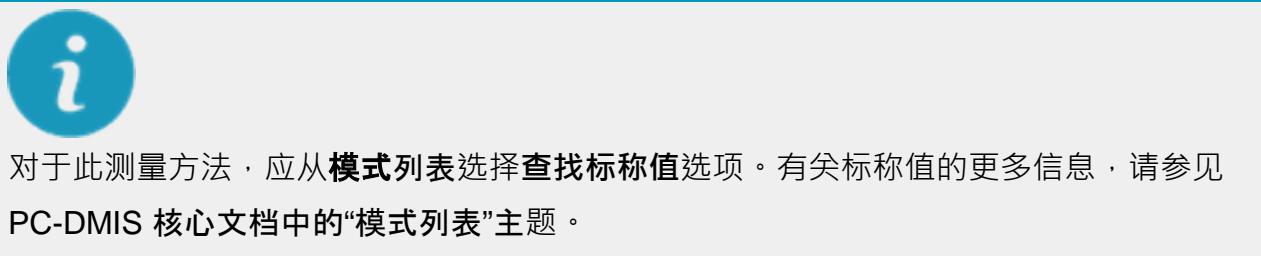
在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

1. 点击 **曲面模式**图标 。
2. 使用鼠标，在“图形显示”窗口中所显示的椭圆上单击一下。PC-DMIS 将计算所需的 X、Y、Z 数据和 I、J、K 数据。
3. 根据所需对电话框做任何其他修改。
4. 单击创建。

通过 CMM 使用曲面数据

在CMM中，要使用曲面数据生成椭圆测量，应至少再椭圆上采五个点。PC-DMIS将刺穿与测头接触点最接近的CAD曲面。所显示的X,Y,Z值反映最接近的CAD椭圆，而不是实际测点。I,J,K反映曲面法线矢量。如果未找到CAD椭圆，PC-DMIS将显示最接近的点，并询问是否采更多点。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

1. 在锥体上的预期线附近单击。PC-DMIS将突出显示所选线。
2. 验证选择了正确的特征。测头逼近方向总是与特征垂直，同时也与当前测头中心线矢量垂直。一旦指定了线，对话框将显示被选椭圆的中心点与直径。
3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
4. 单击创建。



如果基础 CAD

元素不是椭圆，则可能需要更多次单击才能将特征确定。如果PC-DMIS没有突出显示正确的特征，试着至少点击两次额外的位置。

不使用CAD数据

如果在不使用CAD数据的情况下生成椭圆：

1. 在曲面上采三个点来确定椭圆所在平面。
2. 在孔中（或在键上）再采五个点。

PC-DMIS

将使用该数据来计算薄壁件椭圆。还可采额外的点直到单击创建按钮。所显示的 X, Y, Z 值是计算所得的椭圆中心。另外，还会显示计算所得的长直径和短直径以及方位矢量。

键入数据

此方法允许用户键入椭圆所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。此外，椭圆的最大和最小半径以及角度矢量 I2,J2,K2 也需被键入。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

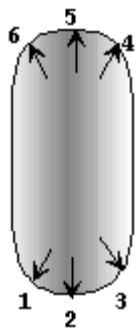
创建自动圆槽



“自动圆槽”按钮

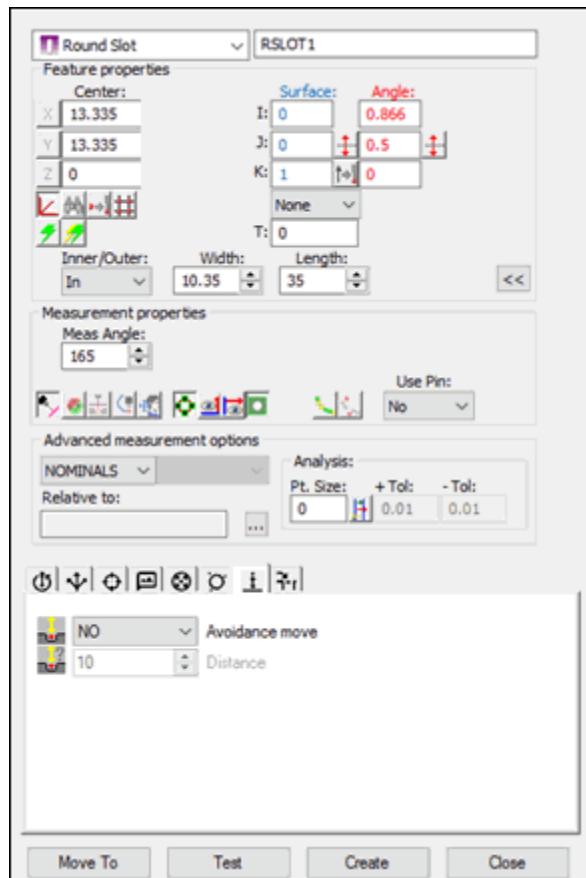
Printed

圆槽选项用于定义圆槽测量。当用户不想测量一系列直线和圆或利用它们构造交点和中点时，此测量类型尤其有用。要测量一个圆槽，至少需要六个测点。



最少六个测点的圆槽

要进入圆槽选项，进入**自动特征**对话框中的圆槽（**插入 | 特征 | 自动 | 圆槽**）。



自动特征对话框 - 圆槽

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成圆槽测量：

1. 点击**曲面模式**图标
2. 使用鼠标，仅在“图形显示”窗口中显示的槽的任何部分上单击一下。
3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
4. 单击创建。

通过 CMM 使用曲面数据

在 CMM 中，要使用曲面数据生成圆槽，在每个弧上接触三次即可。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

线框 CAD

数据也可用于生成圆槽。使用动态测头，在“图形显示”窗口中显示的槽的任何线附近单击一次。

通过 CMM 使用线框数据

在 CMM 中，要使用线框数据生成圆槽测量，只需在每个弧上接触一或三次即可。



如果定义槽末端的 CAD 数据明确地属于“圆”或“弧”类型（即 IGES 实体 100），PC-DMIS

将自动在弧上再采两个点。如果两端都属于此类型，那么在每个弧上接触一次即可测量此特征类型。

对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS核心文档中的“**模式列表**”主题。

不使用CAD数据

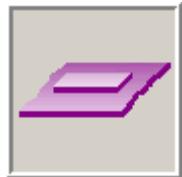
要在不使用 CAD 数据的情况下生成圆槽，在每个弧上接触三次（总共六个测点）即可。

键入数据

这种方法允许用户输入圆槽所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击**创建**在测量程序中插入特征。

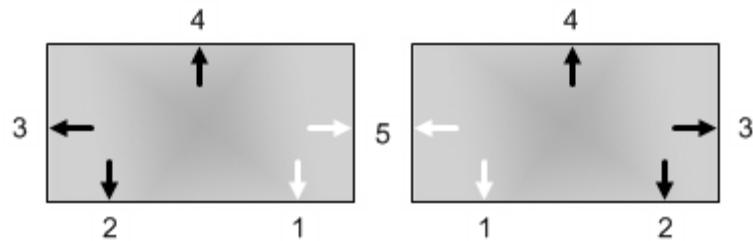
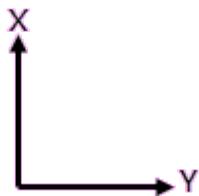
创建自动方槽



“自动方槽”按钮

方槽自动选项用于定义方槽测量。当用户不想测量一系列直线并利用它们构造交点和中点时，此测量类型尤其有用。方槽必须测量五个测点（若选择**测量宽度**列表中的**是**，则需要测量六个点）。

若曲面矢量为 0,0,1，角度矢量为 1,0,0，PC-DMIS 会按照以下方式采点：

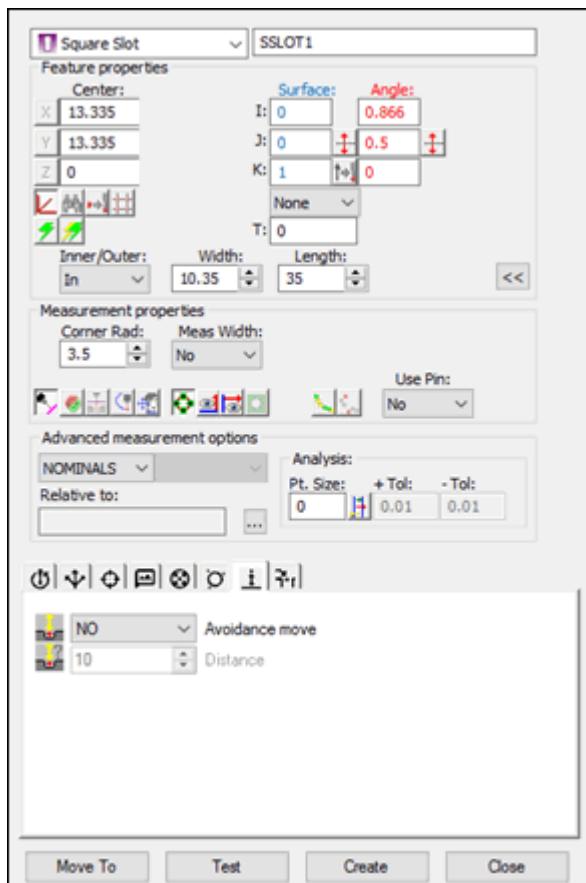


用五个测点测量的方槽



用六个测点测量的方槽

要进入方槽选项，进入**自动特征**对话框中的**方槽**（**插入 | 特征 | 自动 | 方槽**）。



自动测量对话框 - 方槽

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下**方法**创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成方槽：

1. 点击**曲面模式**按钮。
2. 使用鼠标，在方槽的表面附近任意点击一次。PC-DMIS将会从模型上收集到的信息填入到对话框中。
3. 根据所需对电话框做任何其他修改。
4. 单击**创建**。

通过 CMM 使用曲面数据

在 CMM 中，要使用曲面数据生成方槽测量：

1. 使用测头在方槽的长边上接触两次。
2. 接触零件方槽短边上的部分。
3. 继续在槽周围接触下一条长边。
4. 接触最后一条短边。
5. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
6. 单击创建。



接触的顺序应遵循圆弧模式（顺时针或逆时针方向）。

对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

要使用线框 CAD 数据生成方槽，请执行以下步骤：

1. 使用鼠标，在方槽的表面附近任意点击一次。PC-DMIS 将会从模型上收集到的信息填入到对话框中。
2. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
3. 单击创建。

通过 CMM 使用线框数据

在 CMM 中，要使用线框数据生成方槽：

1. 使用测头在方槽的长边上接触两次。

2. 接触零件方槽短边上的部分。
3. 继续在槽周围接触下一条长边。
4. 接触最后一条短边。
5. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
6. 单击创建。



接触的顺序应遵循圆弧模式（顺时针或逆时针方向）。

对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS核心文档中的“**模式列表**”主题。

不使用CAD数据

要在不使用 CAD 数据的情况下生成方槽：

1. 使用三个测点找到顶曲面。
2. 在一条方槽长边上采两个点。
3. 沿顺时针方向在槽的其余三条边上各采一个触测点。（总共应有八个测点。）
4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
5. 单击创建。



测点的顺序应遵循圆弧模式（顺时针或逆时针方向）。

键入数据

这种方法允许用户输入方槽所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

2. 单击创建在测量程序中插入特征。

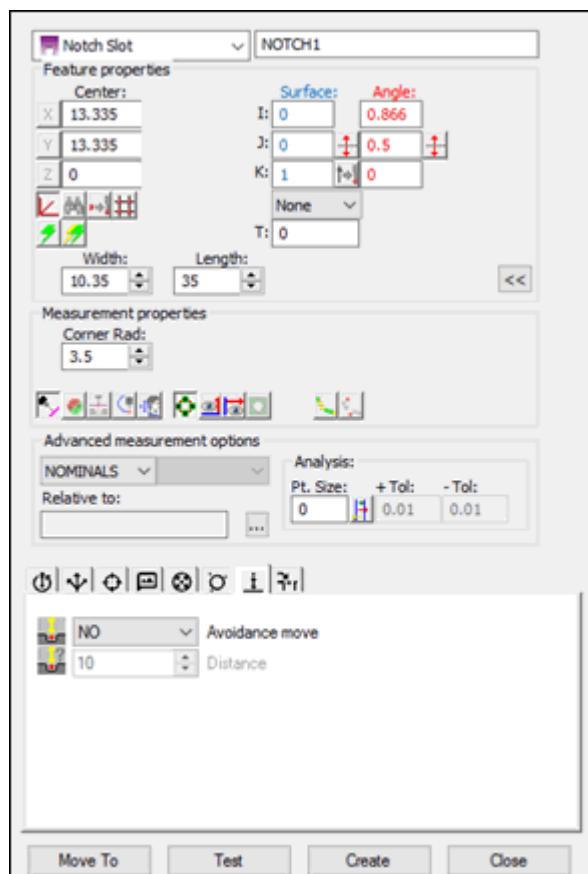
创建自动凹口槽



“自动凹口槽”按钮

凹口槽自动选项用于定义凹口槽测量。凹口槽是三条边的方槽。当用户想测量一系列直线并利用它们构造交点和中点时，此测量类型尤其有用。凹口槽必须用四个测点来测量。

要访问凹口槽选项，需进入**自动特征凹口槽对话框**（**插入|特征|自动|凹口槽**）。



自动特征对话框 - 凹口槽

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成凹口槽测量：

1. 点击 **曲面模式** 图标 。
2. 使用模拟测头，以与使用 CMM 相同的顺序在 CAD 曲面上采集五个测点（请参阅以下“通过 CMM 使用曲面数据”）。
3. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
4. 单击创建。

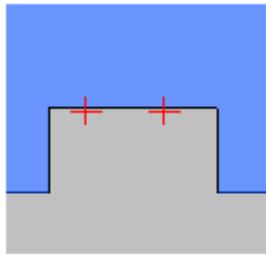
通过 CMM 使用曲面数据



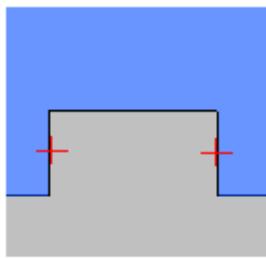
对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“模式列表”主题。

要在 CMM 中使用曲面数据生成凹口槽测量：

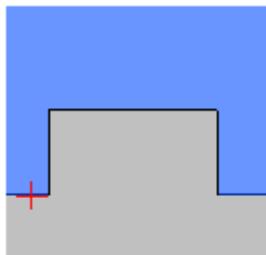
1. 使用测头在凹口槽开口的相对边上接触两次。此将沿棱边定义线。



2. 在凹口槽的一条平行边上接触零件一次，然后在另一条平行边接触一次。这将定义长度。该触点将在边线上，位于两条平行边的中间。



3. 在开口棱上进行一次触测。这将定义凹口槽的宽度。



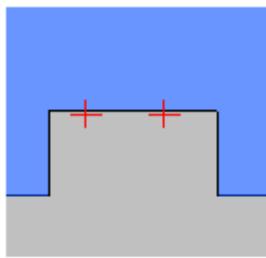
4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
5. 单击创建。

使用屏幕上的线框数据

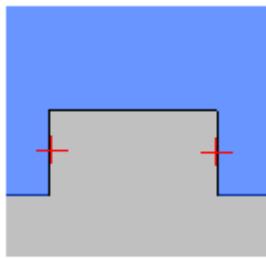
线框CAD数据同样可以用来生成凹口槽。

使用动画测头：

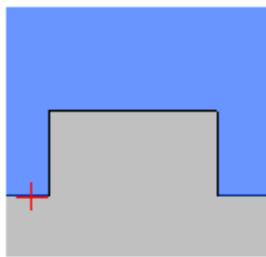
1. 使用测头在凹口槽开口的相对边上接触两次。此将沿棱边定义线。



2. 在凹口槽的一条平行边上接触零件一次，然后在另一条平行边接触一次。这将定义长度。该触点将位于边线上两条平行边的中间。



3. 在开口边上采单个点。这将定义凹口槽的宽度。



4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
5. 单击创建。

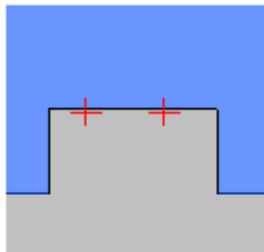
通过 CMM 使用线框数据



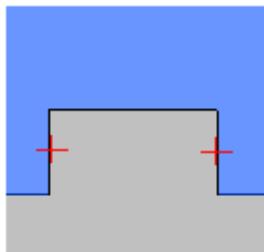
对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

要在 CMM 中使用线框数据生成凹口槽测量：

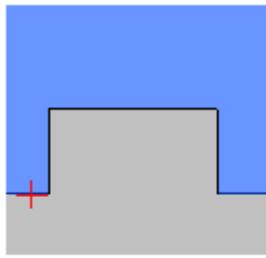
1. 使用测头在凹口槽开口的相对边上接触两次。此将沿棱边定义线。



2. 在凹口槽的一条平行边上接触零件一次，然后在另一条平行边接触一次。这将定义长度。该触点将位于边线上两条平行边的中间。



3. 在开口边上采单个点。这将定义凹口槽的宽度。



4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
5. 单击创建。

不使用CAD数据

要在不使用 CAD 数据的情况下生成凹口槽：

1. 使用三个测点找到顶曲面。
2. 使用测头在凹口槽开口的相对边上接触两次。此将沿棱边定义线。
3. 在凹口槽的一条平行边上接触零件一次，然后在另一条平行边接触一次。这将定义长度。该触点将位于边线上两条平行边的中间。
4. 在开口边上采单个点。这将定义凹口槽的宽度。
5. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
6. 单击创建。

键入数据

这种方法允许用户输入凹口槽所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

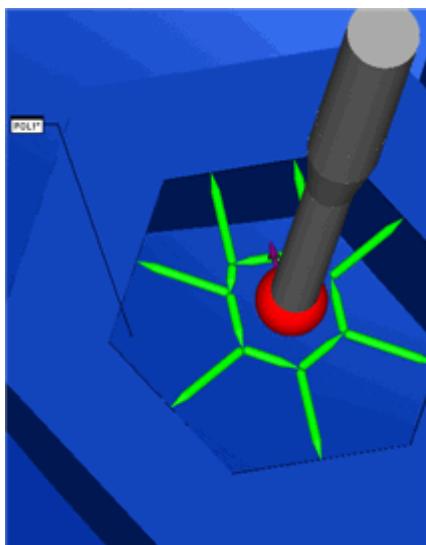
1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

创建自动多边形



“自动多边形”按钮

使用多边形自动选项可定义多边形自动特征，并将其插入至测量程序中。多边形是由三或三条以上相同长度的边组成任何特征。

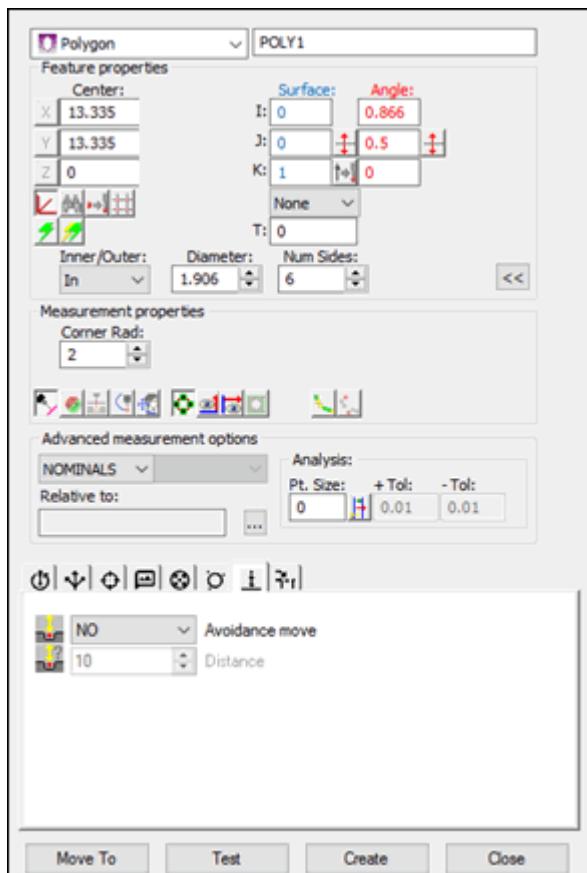


多边形自动特征示例



主要使用此自动特征来测量螺母和螺栓。

要定义及插入一个多边形选项，需打开**自动特征多边形**对话框中（**插入 | 特征 | 自动 | 多边形**）。



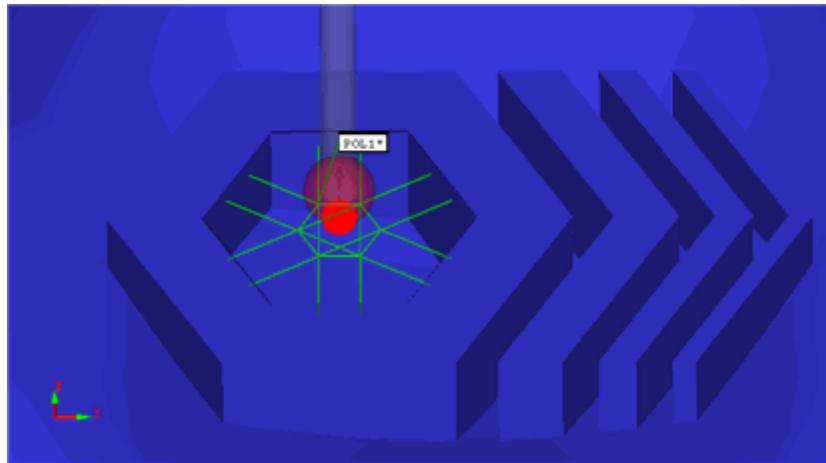
自动测量对话框 - 多边形

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

使用 CAD 模型

1. 进入**多边形自动特征对话框**（**插入 | 特征 | 自动 | 多边**）。
2. 在**边数**框内，**定义用户多边形特征所有的边数**。
3. 在“**图形显示**”窗口中的**所需多边形特征**上单击一下。PC-DMIS

将填入**多边形的中心点信息**，并绘制一些**初步路径线**。当更改该对话框时，请注意
PC-DMIS 将动态更新路径以反映这些更改。



显示初始路径线，每边显示两个测点

4. 在**触测点数**对话框中，定义用户在测量每一边时想要PC-DMIS触测的点数。PC-DMIS将总是在测量特征的第一个边时至少测量两个点来判定特征的角度矢量。
5. 在**方向区域**，可以通过分别选择**孔**或者**外柱**定义是内多边形或外多边形。
6. 在**Corn. Rad.** 框里，定义隅角点半径。这将决定 PC-DMIS 应离隅角多远的位置在多边形边上进行采点。有助于避免直接在隅角内直接进行采点。
7. 在**直径**对话框中，确保用户有一个正确的多边形的**直径**。一般来说，等边多边形的直径是两个对边之间的距离。对于其他多边形，例如等边三角形，是多边形内接圆的半径二倍。当用户点击多边形时，PC-DMIS将会自动填充该项的值。
8. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
9. 单击**创建**。PC-DMIS 将多边形自动特征插入到测量例程中。

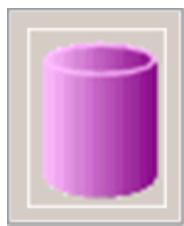
使用 CMM

仅通过使用机器测头在零件上采集测点，可“了解”自动多边形的位置。以所需信息填充对话框。在多边形**自动特征**对话框保持打开的情况下，在多边形边的一边上采集一个测点。第一个测点之后，屏幕底部的状态条将显示其他说明。遵循状态条上的提示完成多边形的创建。完成时单击**创建**。

键入数据

若已知多边形的理论数据，则也可仅通过在合适字段中输入其理论数据来创建多边形自动特征。使用“多边形”自动特征对话框，指定 XYZ 中心和 IJK 矢量信息。定义边数、每边的测点数、直径和棱角半径。完成时单击**创建**。

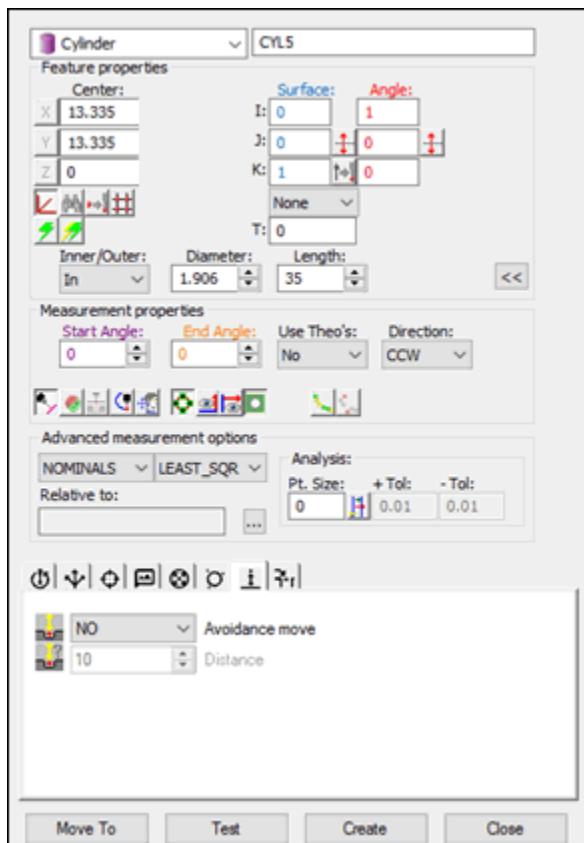
创建自动柱体



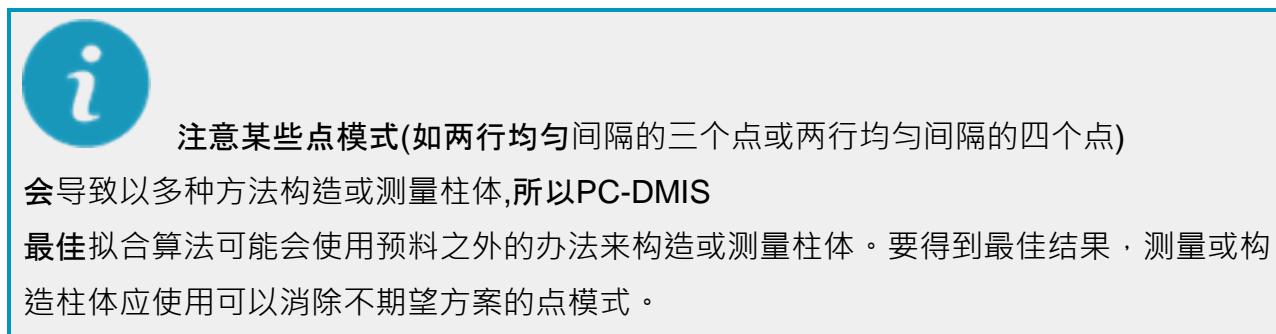
“自动圆柱”按钮

圆柱自动选项用于定义柱体测量。当部分柱体需要均匀间隔测点时，此测量类型尤其有用。为测量一个自动柱体，至少需要六个测点。

访问圆柱 选项，需进入**自动特征** 圆柱对话框(**插入**|**特征** | **自动** | **圆柱**)。



自动特征对话框 - 圆柱



在对话框打开状态下,根据你的情况,使用以下方法创建特征。

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成柱体,请执行以下步骤:

1. 点击**曲面模式**按钮。
2. 将光标放在(所需柱体的外部或内部)。

3. 在柱体周围曲面上点击一下。PC-

DMIS将突出显示所选柱体。对话框将会显示从被选圆锥的CAD数据上的中心点和直径。它会选择用户在零件模型上点击位置最接近的圆柱的末端。

4. 通过定义测头工具栏的**接触路径特征** 选项卡中的**起始深度**

和终止深度来定义测量的长度。

5. 如果需要的话，可以 对对话框和测头工具栏

的接触路径特征选项卡进行任何其他修改。

6. 点击 **创建** 按钮。

通过 CMM 使用曲面数据

要在CMM中使用曲面数据生成一个柱体：

1. 在孔里或在键上采三个点。

2. 将测头移至另一深度

3. 再才三个点。PC-DMIS将刺穿与测头接触点最接近的CAD曲面。

所显示的X,Y,Z值反映最接近的CAD柱体，而不是实际测点。I,J,K反映曲面法线矢量。如果未找到CAD柱体，PC-DMIS将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

线框CAD数据也可用于生成柱体。

要使用线框数据生成柱体：

1. 在柱体上的预期线附近点击。PC-

DMIS 将会突出显示被选中的线并将选择用户在零件模型上点击的位置最接近的圆柱的末端。

2. 验证所选择正确的特征。

测头逼近的方向始终垂直于该特征，同时垂直于当前测头中心线矢量。一旦指定了线，对话框将显示所选柱体的中心点和直径的值。



如果基础 CAD

元素不是圆柱、圆或弧，则可能需要更多次单击才能将特征确定。如果 PC-DMIS 未突出显示正确的特征，试着在柱体上至少再点击两个位置。

不使用 CAD 数据

要在不使用 CAD 数据的情况下生成柱体，请执行以下步骤：

1. 在曲面上采三个点，来找到柱体所在的平面。
2. 在孔中（或在键上）采三个点。
3. 在另一级别上再采三个点。

PC-DMIS 将使用所有六个测点来计算薄壁件柱体。有时，如果 PC-DMIS 无法确定特征类型，最好在两个级别之间进行一次触测。PC-DMIS 将使用所有测定测点的数据，直至选择 **创建** 按钮。所显示的 X, Y, Z 值是计算所得的柱体（或键）中心。

键入数据

此方法允许用户键入圆柱所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击 **创建** 在测量程序中插入特征。

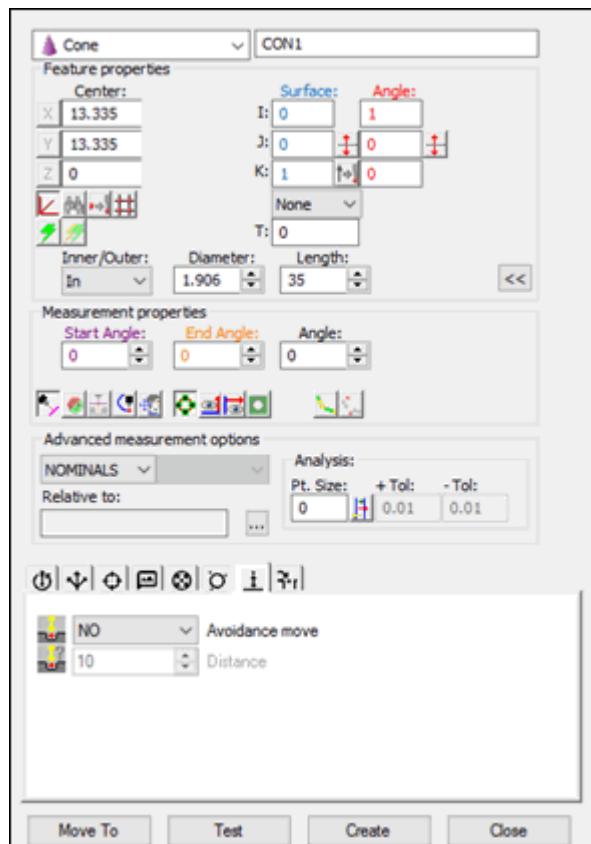
创建自动锥体



“自动圆锥”按钮

圆锥自动选项用于定义圆锥测量。当部分锥体需要均匀间隔测点时，该测量类型尤其有用。
要测量一个自动锥体，只是需要六个测点。

访问圆锥选项，需进入**自动特征圆锥对话框**（**插入|特征|自动|圆锥**）。



自动特征对话框-圆锥

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征。

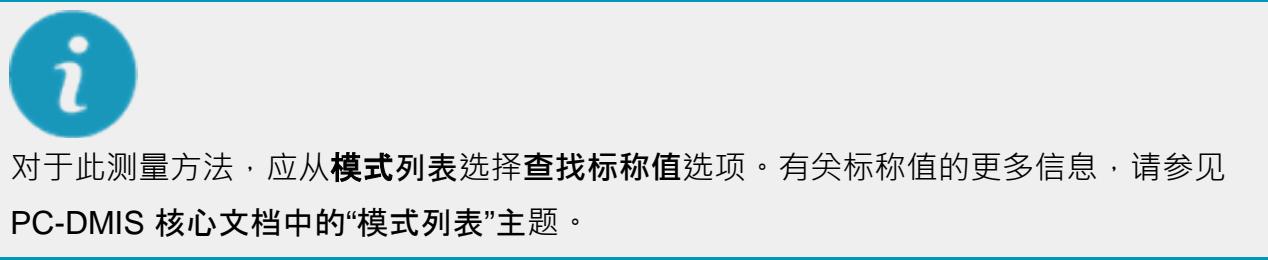
使用屏幕上的曲面数据

要使曲面数据生成锥体：

1. 点击**曲面模式**按钮。
 2. 将光标放在所需锥体的外部或内部。
 3. 在圆锥表面点击一次。PC-
- DMIS将突出显示所选锥体。对话框将会显示从被选圆锥的CAD数据上的中心店，锥角及直径。
4. 根据所需对电话框做任何其他修改。
 5. 单击**创建**。



通过 CMM 使用曲面数据



要利用CMM的曲面数据生成锥体：

1. 在孔里或在键上采三个点。
2. 将测头移至另一深度。
3. 再才三个点。PC-DMIS将刺穿与测头接触点最接近的CAD曲面。

所显示的X,Y,Z值反映最接近的CAD锥体，而不是实际测点。I,J,K反映曲面发现矢量。如果未找到CAD，PC-DMIS将显示最接近的点，并询问是否进行更多触测。



PC-DMIS3.6及以前版本测量外锥（键）时可能需要忽略测量的矢量和长度。

使用屏幕上的线框数据

线框CAD数据也可用于生成锥体。

要使用线框数据生成锥体：

1. 在锥体上的预期线附近单击。PC-
DMIS将突出显示所选线。这将得到锥体中心，曲面矢量和直径。
2. 单击表示锥体另一端的第二条线以计算角度。

测头逼近方向始终垂直于该特征，同时垂直于当前测头中心线矢量。一旦指定了线，对话框将显示所选锥体的中心点与直径的值。



PC-DMIS3.6及以前版本测量外锥（键）时可能需要忽略测量的矢量和长度。

如果基础 CAD 元素不是锥体、圆或弧，则可能需要更多次单击才能将特征确定。若 PC-DMIS 未突出显示正确的特征，则请尝试单击此圆的至少两个其他位置。

不使用CAD数据

要在不使用CAD数据的情况下生产锥体：

1. 在曲面上采三点来确定圆锥所在的平面。
2. 在同一级别的孔中（或在键上）采三个点。
3. 在低于或高于前三个测点的级别上至少进行一次触测（最多测量三个点来获得锥体的准确定义）。



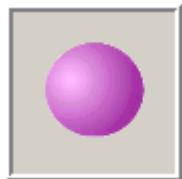
PC-DMIS3.6及以前版本测量外锥(键)时可能需要忽略测量的矢量和长度。

键入数据

此方法允许用户键入圆锥所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
2. 单击创建在测量程序中插入特征。

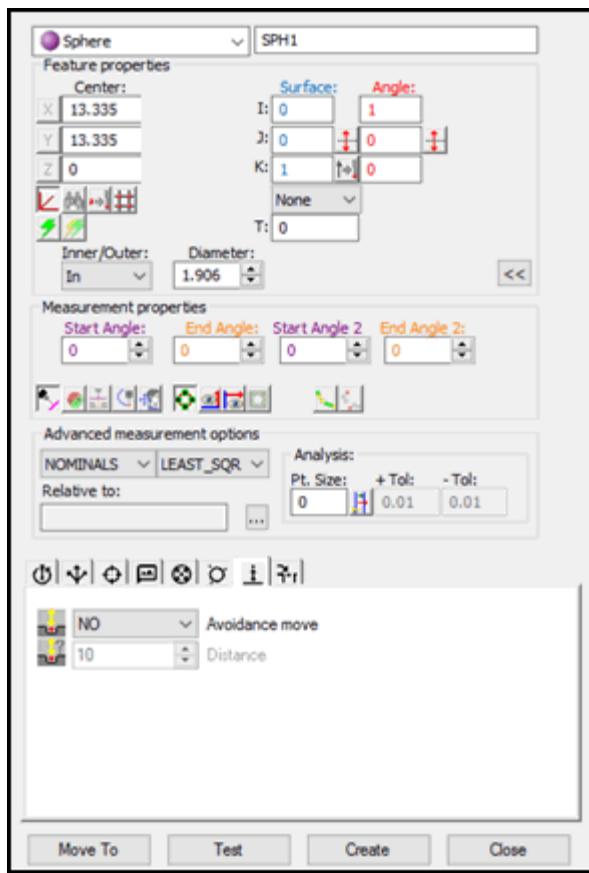
创建自动球体



“自动球体”按钮

球体薄壁件选项用于定义球体测量。当球体位于不平行任何工作平面的特定平面时，此测量类型尤其有用。要测量一个自动球体，至少需要四个测点。

要访问球体选项，访问球体的**自动特征**对话框（**插入 | 特征 | 自动 | 球体**）。



自动测量对话框 - 球体

在对话框打开状态下，根据你的情况，使用以下方法创建特征：

- 使用屏幕上的曲面数据
- 通过 CMM 使用曲面数据
- 使用屏幕上的线框 CAD 数据
- 键入数据

使用屏幕上的曲面数据

要使用曲面数据生成锥体：

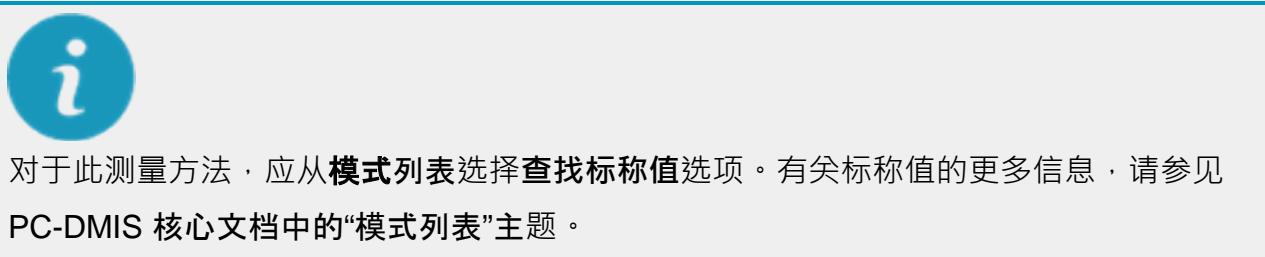
1. 单击**曲面模式**图标。
2. 将光标置于“图形显示”窗口中以指示所需球体。
3. 单击鼠标左键。

一旦指定了点，对话框将显示所选球体和矢量的值。

通过 CMM 使用曲面数据

在 CMM

中，要使用曲面数据生成球体，可使用测头接触球体上的四个位置。如果在用户单击**创建**之前又被检测到有鼠标的点击，PC-DMIS 将会找到测点附近的最佳的球体。



对于此测量方法，应从**模式列表**选择**查找标称值**选项。有关标称值的更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

使用屏幕上的线框数据

若要使用线框 CAD 数据生成球体：

1. 选择要测量的球体。PC-DMIS

将突出显示所选球体（若可用）。（若选择其他特征，可尝试另外采集两个测点。
）

2. 验证所选择正确的特征。

一旦指定了球体，对话框将显示所选 DCC 球体和矢量的值。

键入数据

使用此方法可键入球体所需的 X、Y、Z、I、J 和 K 值。

1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J 和 K 值。
2. 单击**创建**在测量程序中插入特征。

有关标称值的更多信息，请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“**模式列表**”主题。

扫描

通过 PC-DMIS 和 CMM 测量机，您可以使用 TTP（接触触发测头）在 DCC（直接计算机控制）模式下以指定增量扫描零件曲面。另外，如果您在手动模式下操作，应同时使用接触触发测头或硬测头执行手动扫描。

关于接触触发测头 (TTP) 扫描

DCC

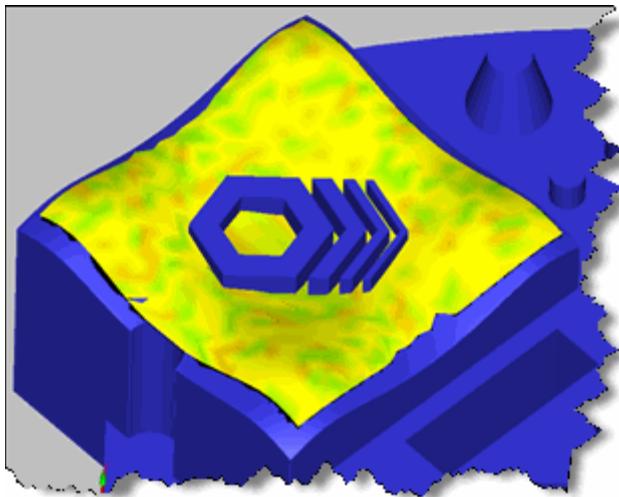
TTP扫描，也称为“缝合式”扫描，因为当接触零件的曲面时就像缝纫机的缝合动作，由PC-DMIS和CMM控制器。提供了一个智能，自我调整的算法，能够计算曲面法向矢量用于准确的测头补偿。

关于连续接触扫描

DCC连续接触扫描（模拟测头完成的扫描）与零件的曲面保持连续接触。PC-DMIS会将扫描参数发送给控制器。基于选择的参数，控制器将扫描零件并将扫描点通知给 PC-DMIS。连续接触扫描通常会快速产生大量的点数据。

可用扫描类型

这些不同的扫描方法在数字化零件曲面上的轮廓方面很有用。



片区扫描的示例曲面图

若要扫描零件的特征和曲面，PC-DMIS
会为您提供这些扫描类型：基础扫描、高级扫描和手动扫描。

本章主要介绍**插入 | 扫描子菜单**中的可用选项：

- 执行高级扫描
- 创建快速扫描
- 执行基本扫描
- 执行手动扫描



扫描对话框中的扫描选项在 PC-DMIS 核心文件中的“扫描零件”一章中讨论。

执行高级扫描

高级扫描是由接触式触发测头 (TTP) 执行的 DCC 缝合式扫描。PC-DMIS 和 CMM
控制器驱动这些扫描。DCC

扫描程序使用智能型、自适应算法，此算法可计算精确测头补偿的曲面常规矢量。

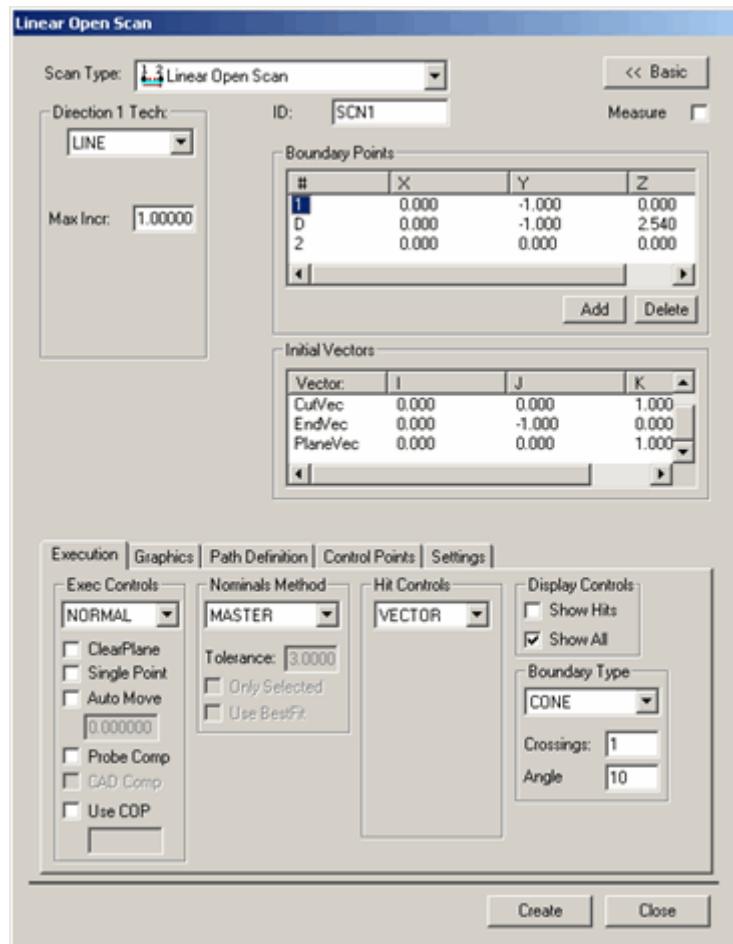
这些高级扫描利用 TTP，允许曲面上配置文件的自动点对点数字化操作。为 DCC 扫描指定必要的参数，并选择测量按钮。PC-DMIS 中的扫描算法将控制测量过程。

PC-DMIS 支持以下高级扫描：

- 开线扫描
- 闭线
- 曲面
- 边界
- 截面扫描
- 旋转扫描
- 自由曲面
- UV扫描
- 栅格扫描
- 使用部分切割

有关用于执行这些扫描的扫描对话框内可用选项的信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“扫描对话框的常用功能”一章。

执行高级开线扫描

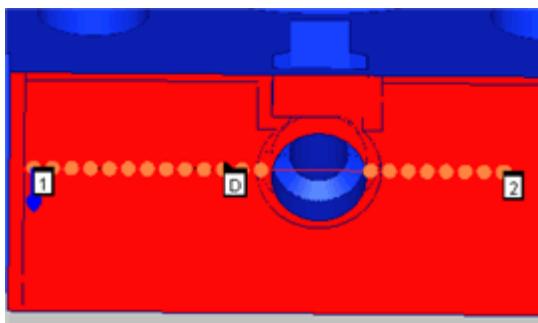


开放路径扫描对话框

插入 | 扫描 |

开线方法将会扫描敞开端直线上的曲面。此程序使用直线的起点和终点。它还包括方向点，以计算切割平面。执行扫描时，测头始终在切割平面内。

如“方向技术区域”所述，有三种不同类型的“开线”方向技术。



开放路径扫描样例

创建开放路径扫描

1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
3. 从子菜单中选择**插入 | 扫描 | 开线**。屏幕上会出现**开线** 扫描对话框。
4. 若要使用自定义名称，在**ID** 框中键入扫描的名称。
5. 从**方向 1 方法**列表中选择适合的开放路径类型。
6. 根据“**开线**”扫描的类型，在**最大增量、最小增量、最大角度和最小角度**框中键入适合的增量和角度值。
7. 如果您要扫描多个曲面，则使用**选择**复选框选择“图形选项卡”中所述的曲面。
8. 根据“**边界点区域**”中所述的相应程序，将点 1（起点）、点 D（扫描方向）以及点 2（终点）添加至扫描。
9. 从触测控制区域中的**触测类型**列表中选择要相应的触测类型。
10. 在**起始矢量区域**中对矢量进行所需更改。要执行此操作，请双击矢量，对**编辑扫描**项对话框进行更改，然后单击**确定**返回**开线扫描**对话框。
11. 从**标称值方法**区域的**标称值**列表中选择适合的标称值模式。
12. 在**标称值方法**区域的**公差**框中，键入最小补偿测头半径的公差值。
13. 在**执行控制**区域中从**执行**列表中选择适当的执行模式。
14. 如果使用薄件，在图形按钮中的**厚度**框中键入部件的厚度。
15. 如果需要，在**执行**选项卡上的区域中选择任何复选框。
16. 若使用模拟测头，则考虑使用**控制点**选项卡以最佳运行扫描。

17. 在理论路径区域的路径定义选项卡中单击生成按钮，从而在“图形显示”窗口中的

CAD 模型上生成扫描预览。生成扫描时，PC-DMIS

将在起点开始扫描，并按照所选的方向进行扫描，直到到达终点。

18. 若要删除各点，从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。

19. 如果需要，使用同一选项卡上的样条路径区域将理论路径拟合到样条路径。

20. 根据需要对扫描进行其他修改。

21. 点击 创建 按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。

使用快速扫描功能创建开线扫描

在曲线模式或曲面模式下，可使用快速扫描功能从折线或表面上创建开线扫描。有关详细信息，请参阅“创建快速扫描”。

在曲线模式下创建开线扫描

若 CAD 包含曲线或折线，可通过在图形模式工具栏（视图 | 工具栏 | 图形模式）上选择曲线模式以在曲线模式下创建开线扫描。

单击以定义曲线上的 点 1

时，将选择该曲线。您可以仅选择该曲线上的一个或两个点。若要在另一曲线上定义扫描，请选择开线扫描对话框（插入 | 扫描 | 开线）中图形选项卡上的取消全选按钮。

在3D线框模型上创建一个开线扫描

在线框模型上执行一个开线扫描，通常需要使用 3D 线框 CAD 文件。使用 3D 线定义需要扫描的特征和“深度”(3D)。这种扫描遵循如上同样原则。

在二维线框CAD模型上创建线性开放扫描

如果您要在一个2D线框上执行一个开线扫描，您需要做一些额外的工作。

1. 导入 2D CAD 文件。CAD 原点需要位于 CAD

某些位置上， 并不会离开主题坐标（这可使操作更为容易）。

2. 选择插入 | 特征 | 构建 | 直线。构建直线对话框出现。

**3. 选择坐标系。此操作会在 CAD 原点构造一条直线，为 2D CAD
数据曲面的法线。**

4. 打开“编辑”窗口。如果测量单位使用毫米，则将直线的长度从

1（默认值）更改为更长的长度，如 5 或

10。对于使用英寸的测量程序，则可忽略此步骤。

5. 将测量程序（仅特征）导出至 IGES 或 DXF

文件类型。并将导出文件存储至所选的目录上。

6. 返回测量程序。删除已创建的坐标系线。

7. 导入您刚刚导出至相同测量程序内的文件。当 PC-DMIS 提示时，单击合并以将

CAD 线合并入“图形显示”窗口中。此时，CAD 模型应具备其他 CAD

线余下部分的 CAD 线。

8. 打开开线扫描对话框。

9. 点击图形选项卡并且选择选择复选框

10. 点击定义待扫描特征的线。从扫描开始的地方，根据被扫描顺序选择他们。

11. 选中深度复选框。

12. 点击导入的垂直于其它线的线。

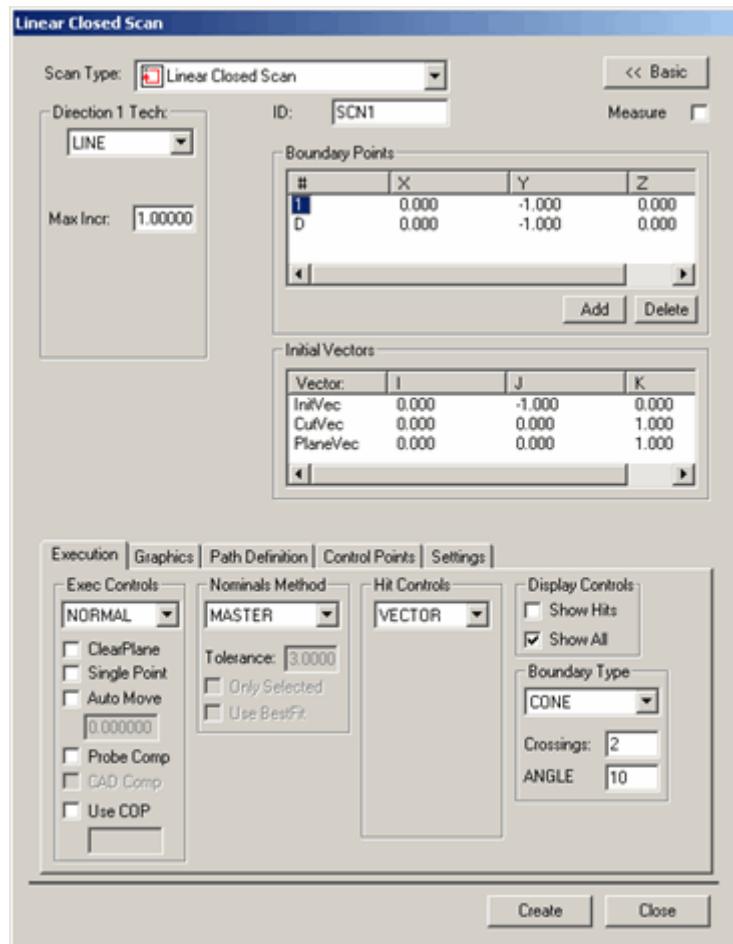
**13. 清除选择复选框。可以在由线框定义的理论曲面上选择1点，D点和2边界点，以定
义曲面的形状和线框的深度。**

14. 如果 PC-DMIS

处于联机模式，选择测量复选框。从标称值方法区域选择查找标称值。在公差框中
，选择适合的公差值。

**15. 单击创建。PC-DMIS 插入扫描。若处于联机模式下，PC-DMIS
会开始扫描并查找标称值。**

执行闭合高级扫描



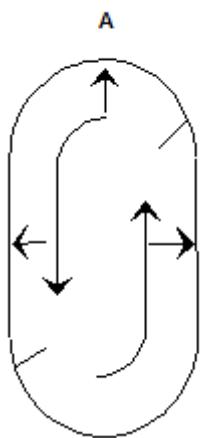
闭合路径扫描对话框

插入 | 扫描 |

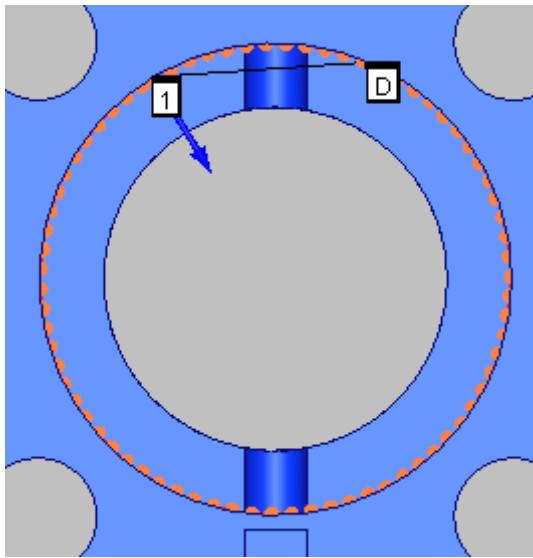
闭线方法会在指定的起点开始扫描曲面，并在此点处完成扫描。此类型的扫描为闭线扫描，因为它会返回至起点处。这对于扫描圆特征或插槽相当有用。

此过程需要对起点位置和方向点进行定义。您提供增量值，以采集测点。

PC-DMIS 将对如下定义的曲面进行扫描。



A - 起点和终点



扫描点在孔内的样例线性关闭扫描

若要创建闭线扫描

1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
3. 从子菜单中选择**插入 | 扫描 | 闭线**。屏幕上会出现闭线扫描对话框。
4. 如果您想使用自定义的名字，则在标识框中键入扫描的名称。
5. 从**方向 1 方法**列表中选择适合的闭合路径类型。

6. 根据闭合路径扫描的类型，在最大增量、**最小增量、最大角度和最小角度**框中键入相应的**增量和角度**值。
7. 如果扫描经过多个曲面，应考虑在“图形选项卡”中使用选择复选框选择多个曲面。
8. 按照“边界点区域”中所述的相应步骤，向扫描中添加 1 点（起始点）和 D 点（扫描方向）。
9. 从触测控制区域中的触测类型列表中选择要相应的触测类型。
10. 在起始矢量区域中对矢量进行所需更改。要执行此操作，请双击矢量，对**编辑扫描**项对话框进行更改，然后单击**确定**返回闭线扫描对话框。
11. 从标称值方法区域的标称值列表中选择适合的标称值模式。
12. 在标称值方法区域的公差框中，键入最小补偿测头半径的公差值。
13. 在执行控制区域的执行列表中选择适合的执行模式。
14. 若使用薄件，在图形选项卡上的**厚度**框中键入零件的厚度。
15. 如果需要，在执行选项卡上的区域中选择任何复选框。
16. 若使用模拟测头，则考虑使用**控制点**选项卡以最佳运行扫描。
17. 在理论路径区域的**路径定义**选项卡中单击**生成**按钮，从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。生成扫描后，PC-DMIS 会在起点处开始扫描，并按照特征周围的选择方向执行扫描，直至它返回起点。
18. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从**理论路径区域**一次选择一个点并按 Delete 键。
19. 如果需要，使用同一选项卡中的**样条路径**区域 将理论路径拟合到样条路径。
20. 根据需要对扫描进行其他修改。
21. 点击**创建**按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。

在3D线框CAD模型上创建一个线性关闭扫描

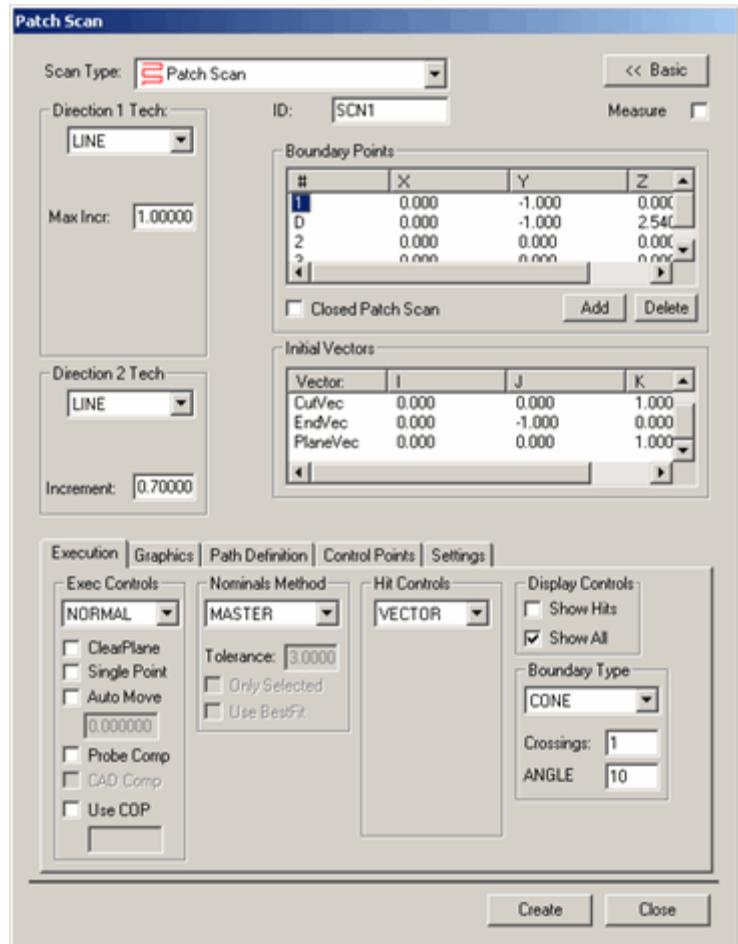
在线框模型上执行一个闭合扫描，通常需要使用 3D 线框 CAD 文件。使用 3D 线定义需要扫描的特征和“深度”(3D)。这种扫描遵循如上同样原则。

在2D线框CAD模型上创建一个线性关闭扫描

如果您必须在一个2D线框上执行一个闭合扫描，您需要做一些额外的工作。

1. 导入 2D CAD 文件。CAD 原点需要在 CAD 上，而没有离在体坐标系（只是让事情变得简单）。
2. 选择**插入 | 特征 | 构建 | 直线**。**构建直线**对话框出现。
3. 选择**坐标系**。此操作会在 CAD 原点构造一条直线，为 2D CAD 数据曲面的法线。
4. 访问“编辑”窗口，如果测量单位使用毫米，则将直线的长度从 1（默认值）更改为更长的长度，如 5 或 10。对于使用英寸的测量程序，则可忽略此步骤。
5. 将测量程序（仅特征）导出至 IGES 或 DXF 文件类型。并将导出文件存储至所选的目录上。
6. 返回测量程序。删除已创建的坐标系线。
7. 导入您刚刚导出至相同测量程序内的文件。当出现提示时，单击**合并**以将 CAD 线合并到“图形显示”窗口中。此时，CAD 模型应具备其他 CAD 线余下部分的 CAD 线。
8. 访问**开线或闭线**对话框。
9. 点击**图形**选项卡并且选择**选择**复选框
10. 点击定义待扫描特征的线。从扫描开始的地方，根据被扫描顺序选择他们。
11. 选中**深度**复选框。
12. 点击导入的垂直于其它线的线。
13. 清除**选择**复选框。可以在由线框定义的理论曲面上选择**1点（起始点）**和**D点（方向点）**，以定义曲面的形状和线框的深度
14. 如果在线模式，选择**测量**复选框。从**标称值方法**区域选择**查找标称值**。在**公差框**中，选择适合的公差值。
15. 单击**创建**。PC-DMIS 插入扫描。若处于联机模式下，PC-DMIS 会开始扫描并查找标称值。

执行片段高级扫描



片区扫描对话框

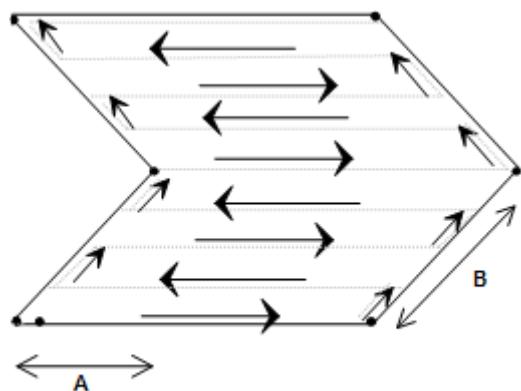
面片扫描类似于一系列相互平行的开线扫描。

插入 | 扫描 | 面片方法会根据**方向 1 技术区域**和**方向 2 技术区域**中选定的技术扫描曲面。

- 执行扫描时测头将始终在切割平面内。
- 方向1技法将指出第一个和第二个边界点之间的方向。
- 方向2技法将指出第二个和第三个边界点之间的方向。

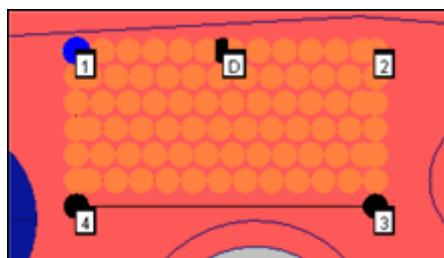
- PC-DMIS 将会扫描方向 1

技术区域中指定曲面上的零件。当遇到第二个边界点时，PC-DMIS 将会自动移动至**方向 2** 技术区域指定的下一行。



A - 方向 1 技术

B - 方向 2 技术



片区扫描的例子

创建片区扫描

1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
3. 从子菜单中选择**插入 | 扫描 | 面片**。屏幕上会出现**面片扫描**对话框。
4. 若要使用自定义名称，在**ID** 框中键入扫描的名称。
5. **从方向 1**

技术列表中为第一个方向选择相应的“面片”类型。根据选定的技术，在**最大增量、最小增量、最大角度和最小角度**框中键入适合的增量和角度值。

若为第一个方向选择**主体技术**，则也必须为第二个方向选择该技术。

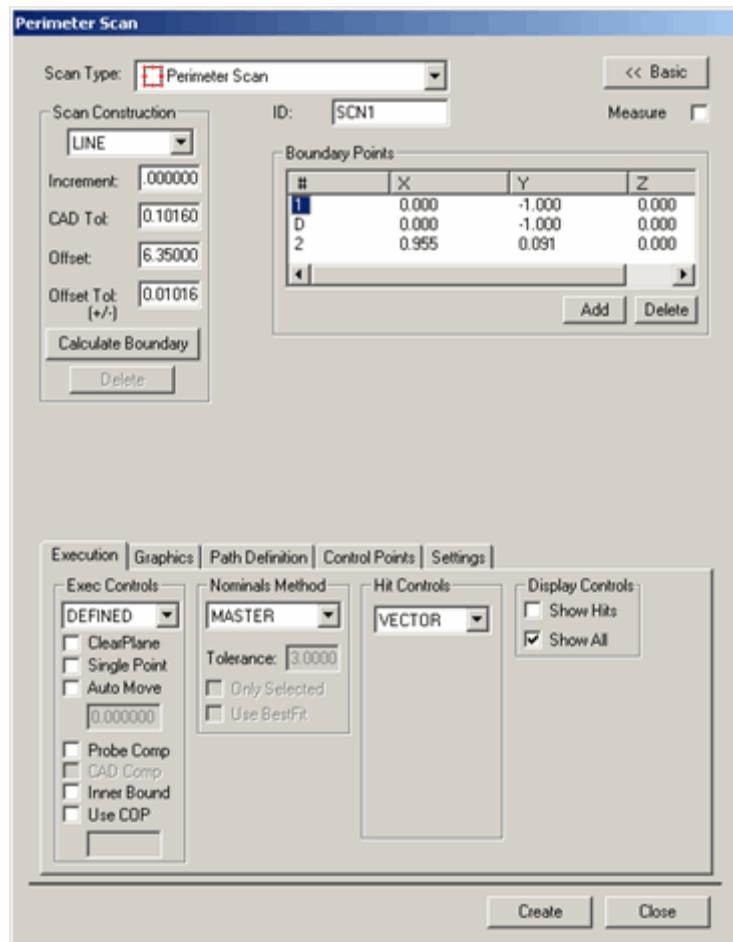
6. 从方向 2

技术列表中为第二个方向选择相应的“面片”类型。根据选定的技术，在可用的**最大增量、最小增量、最大角度和最小角度**框中键入适合的增量和角度值。

7. 如果扫描经过多个曲面，应考虑如在“图形选项卡”主题中所述使用选择复选框选择多个曲面。
8. 添加 1 点（起点）、D 点（开始扫描的方向）、2 点（第一条线的终点）、3 点（生成最小区域），如果需要，还可以添加 4 点（形成正方形或矩形区域）。此操作会选择要扫描的区域。通过“边界点区域”主题所述的适合程序选择这些点。
9. 在**起始矢量**区域中对矢量进行所需更改。要执行此操作，请双击矢量，对**编辑扫描**项对话框进行更改，然后单击**确定**返回**路径扫描**对话框。
10. 从**标称值方法**区域的**标称值列表**中选择适合的标称值模式。
11. 在**标称值方法**区域的**公差**框中，键入最小补偿测头半径的公差值。
12. 在**执行控制**区域中从**执行列表**中选择适当的执行模式。
13. 若使用薄件，在图形选项卡上的**厚度**框中键入零件的厚度。
14. 如果需要，在**执行**选项卡上的区域中选择任何复选框。
15. 若使用模拟测头，则考虑使用**控制点**选项卡以最佳运行扫描。
16. 在**理论路径**区域的**路径定义**选项卡中单击**生成**按钮，从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。在生成扫描时，PC-DMIS 将在起点开始扫描，并按照所选的方向进行扫描，直到到达边界点。然后，扫描来回移动，沿着所选区域在各行中扫描，以指定的增量值在行中扫描，直到完成该过程。
17. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从**理论路径**区域一次选择一个点并按 Delete 键。
18. 根据需要对扫描进行其他修改。

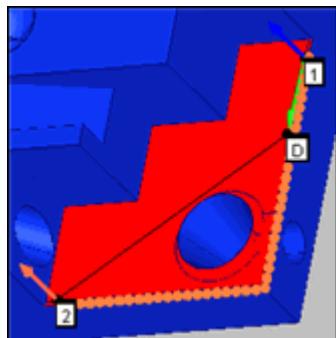
19. 点击 创建 按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。

执行周边高级扫描



周边扫描对话框

插入 | 扫描 | 周边 与其它线性扫描不同，周边扫描是在执行前全部利用 CAD 数据创建的。仅当存在可用的 CAD 曲面数据时，此种类型的扫描方可使用。它可允许 PC-DMIS 在开始扫描之前确切知道其所处位置（较少出现错误）。



外部周边扫描的例子

周边扫描的两种类型。

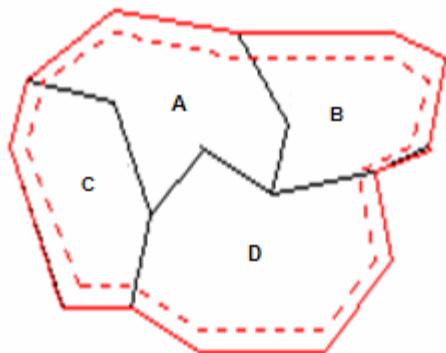
有以下两种类型的圆周扫描：

- **外圆周**扫描会沿所选择曲面边界的外缘执行扫描。外圆周扫描可穿过多曲面边界以创建单个扫描。
- **内部**扫描沿着给定曲面内的边界曲线来进行。这些类型的曲线通常会定义孔、槽或键等特征。与外部扫描不同，内部扫描仅限于单个曲面的内部。

以下两个图（扫描 1 和扫描 2）描述了两种类型的周边扫描。

• 在扫描 1

中，选择了四个曲面。各个曲面相互邻接，但每个曲面的外周边形成了组合边界（用外部的实线来表示）。偏置距离是扫描从组合边界偏置的量（用虚线来表示）。



扫描 1

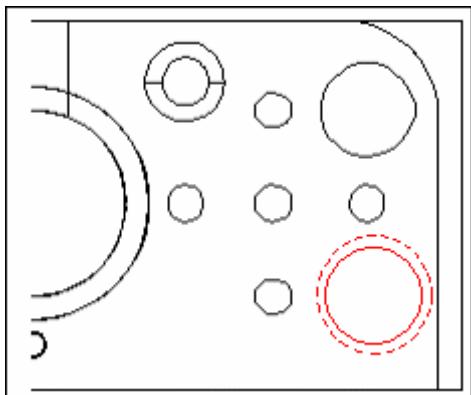
A - 曲面 1

B - 曲面 2

C - 曲面 3

D - 曲面 4

- 在扫描 2 中，圆孔的边界可创建内圆周扫描的路径。



创建外圆周扫描或内圆周扫描的过程相同，并进行如下简单介绍：

若要创建圆周扫描：

1. 访问**边界扫描**对话框（**插入 / 扫描 / 边界**）。
2. 若要使用自定义名称，在**ID**框中键入扫描的名称。
3. 对于内部周边扫描，请选中**执行**选项卡上的**内边界**复选框。
4. 选择用于创建边界的曲面。如果选择多个曲面，则应按照扫描将会穿过的先后顺序选择曲面。若要选择所需的曲面：
 - 确保**选择**复选框已在**图形**选项卡上进行选择。
 - 依次单击将在扫描中使用的曲面。选择后，每个曲面都会突出显示。
 - 选择所需曲面后，清除**选择**复选框。
5. 在开始扫描所处的边界附近单击曲面。这就是起点。
6. 沿将执行扫描的方向第二次单击相同的曲面。这就是方向点。

7. 如果需要，单击要让扫描终止的点。该点是可选的。如果未提供终点，则扫描将在其起点处终止。

**PC-DMIS**

将自动提供一个终点。若不使用此终点，则删除该点。要删除该点，在**边界点列表**中突出显示数字（默认值为 2），并单击**删除按钮**。

8. 在扫描构造区域中键入适当的值。其中包括以下项目：

- **增量框**
- **CAD 公差 框**
- **偏置框**
- **偏置公差 (+/-) 框。**

9. 选择**计算边界按钮**。此按钮计算 PC-DMIS

将创建扫描的边界。边界上的橙色点表示在周边扫描上的触测位置。



边界计算应该是比较快的过程。

如果发现边界不正确，单击**删除按钮**。这样将删除边界并允许创建另一个边界。

如果边界显得不正确，通常表示需要增大 CAD 公差。

当更改 CAD 公差后，单击**计算边界按钮**，以重新计算边界。

在计算周边扫描之前，应验证边界正确，因为计算扫描路径所需的时间比重新计算边界所需的时间长。

10. 验证**偏置**值正确。

11. 在理论路径区域的路径定义选项卡中单击**生成**按钮。之后，PC-DMIS

将计算用于执行扫描的理论值。此过程包括时间相当集中的算法。根据所选择曲面的复杂度以及正在计算的点数量，计算扫描路径可能需要一段时间。（五分钟的等待时间相当常见）。如果扫描显示不正确，单击**取消**按钮删除建议的扫描路径。若需要，更改**偏置公差**值，并重新计算扫描。

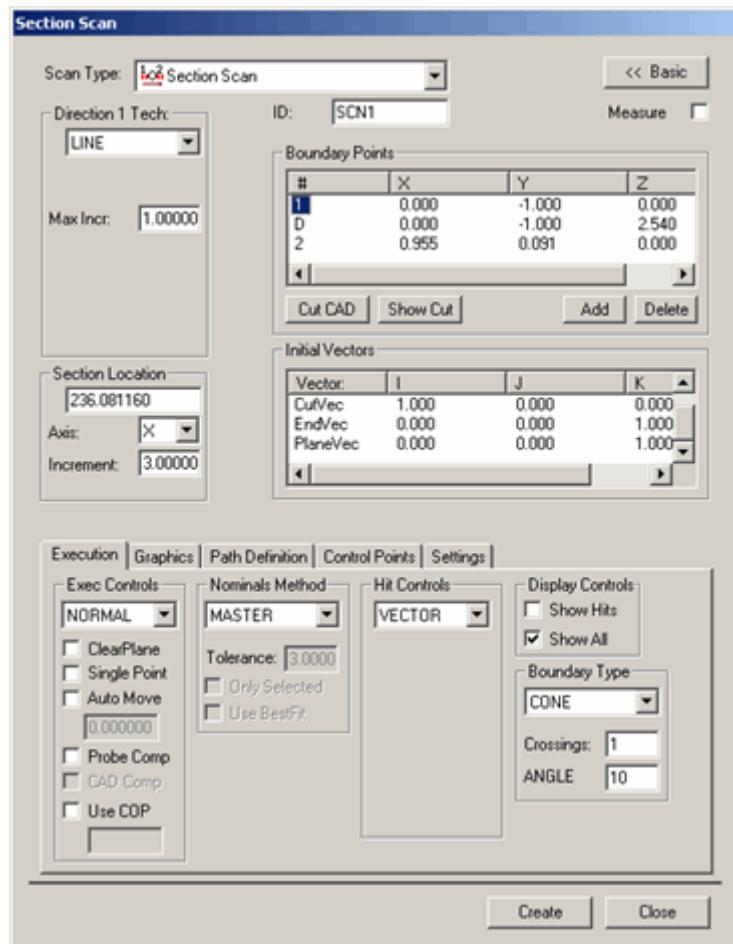
12. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。

13. 单击**创建**按钮创建周边扫描并将其存储在“编辑”窗口中。其执行方式将与其它任何扫描相同。若启用了 PC-DMIS 的 AutoWrist 方法，但没有任何校验过的测尖，则在添加需要校验的新测尖时 PC-DMIS 将显示消息通知您。在所有其他情况下，PC-DMIS 会询问您是为需要的测尖角度使用最接近的校准过的测尖，还是在需要的角度添加新的未校准测尖。

避开孔的注意事项

请注意，执行选项卡的**执行控制**区域中的**定义模式**并不支持与圆周扫描的圆孔避开。确保在此执行模式下扫描路径中没有任何孔。如有，调整路径或切换至“标准”**执行模式**。

执行截面高级扫描



截面扫描对话框

插入 | 扫描 |

截面扫描与开线扫描十分相似。截面扫描扫描的是零件上沿某条线的曲面。仅当存在可用的 CAD 曲面数据时，此种类型的扫描方可使用。藉助 CAD 曲面数据，PC-DMIS 检测截面处的起点和终点。截面扫描采用线的起点和终点，同时也包含一个方向点。执行扫描时测头将始终在切割平面内。

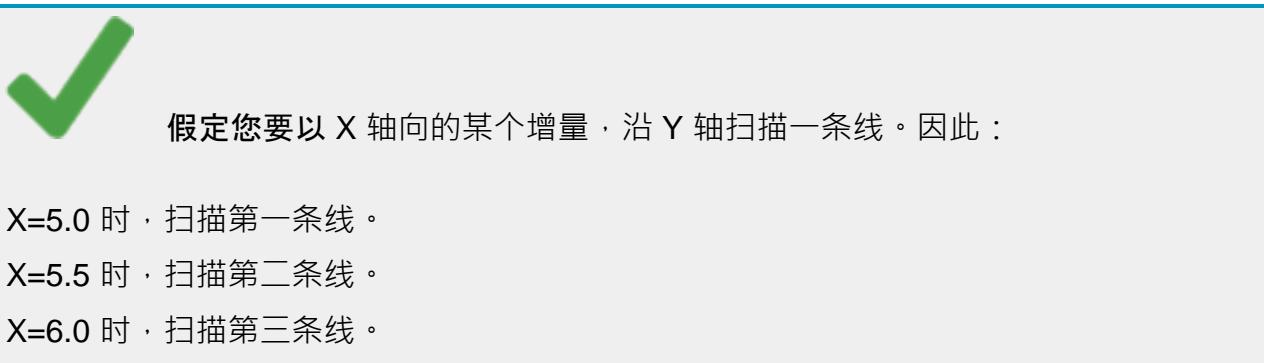
截面扫描方向方法具有三种类型。

探测并跳过孔

当在零件上扫描时，截面扫描能够检测到孔并跳过这些孔。此种类型的扫描允许您选择由 CAD 工程师在屏幕上绘制的“截面直线”，并继续进行扫描。

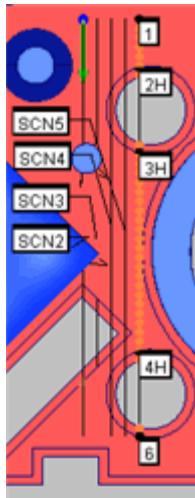
沿着固定轴进行多次扫描

使用截面扫描的一个好处是，可以沿固定轴进行多次扫描。



要执行此操作，需要进行几次开线扫描，但是您可使用截面扫描完成此类型的增量扫描。

X = 5.0 X = 5.5 X = 6.0 设置该截面扫描时，将 X 设为截面轴，将截面增量设为 0.5。也可设置其他参数（参见“执行开线高级扫描”）。当测量完扫描后，PC-DMIS 将重新显示**截面扫描**对话框，而所有边界点都按照定义的增量移动到了下一个截面。



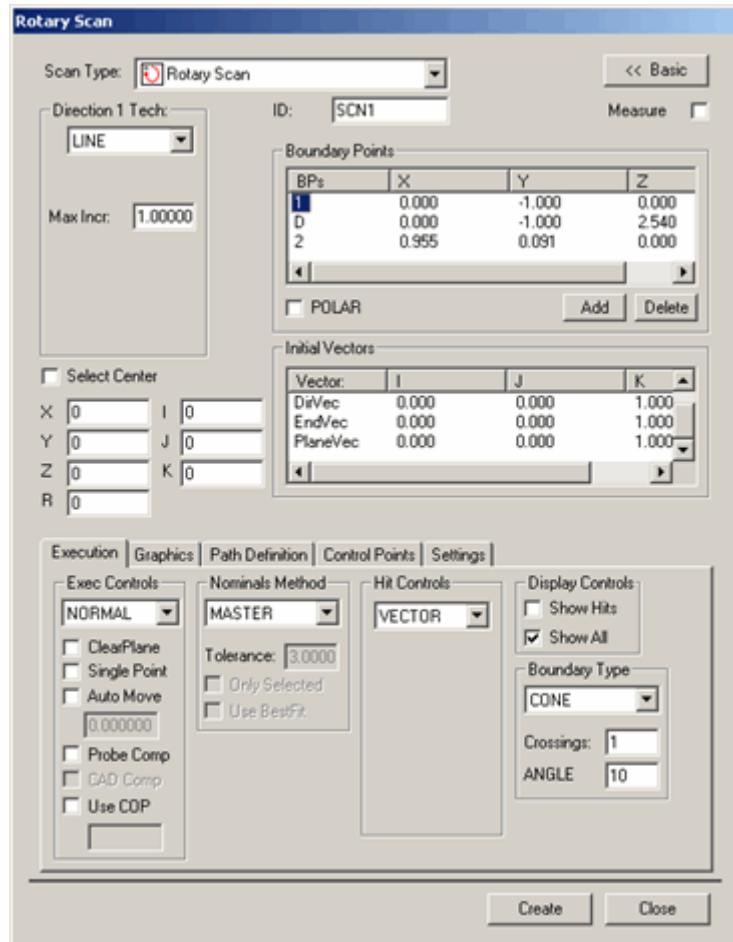
截面扫描的例子

创建截面扫描

1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
3. 从子菜单中选择**插入 | 扫描 | 截面**。屏幕上会出现**截面 扫描** 对话框。
4. 若要使用自定义名称，在 **ID** 框中键入扫描的名称。
5. **从方向 1**
技术列表中为第一个方向选择相应的“截面”类型。根据选定的技术，在**最大增量、最小增量、最大角度和最小角度**框内键入适合的增量和角度值。
6. 如果扫描经过多个曲面，应考虑在“图形选项卡”中使用选择复选框选择多个曲面。
7. 为截面扫描添加 1 点（起点）、D 点（扫描方向）和 2 点（终点）。这将选择您要扫描的直线。按照“边界点区域”主题中所述的相应步骤选取这些点。
8. 选择**切割 CAD** 按钮。这可以将扫描切割成多个子截面，并显示 PC-DMIS 会因曲面上的障碍物（例如孔）而跳过的位置。此时，可以单击**显示边界**按钮重新显示边界点。
9. 在**截面位置区域**执行以下操作：
 - 从轴列表中选择轴，后续截面扫描将会沿此轴递增。
 - 为该轴键入要为所有边界点设置的位置轴。
 - 在**增量**框中键入增量值。该值是在单击**创建**按钮后，PC-DMIS 将移动扫描的增量。
10. 从触测控制区域中的**触测类型**列表中选择要相应的触测类型。
11. 在**起始矢量**区域中对矢量进行所需更改。要执行此操作，请双击矢量，对**编辑扫描**项对话框进行更改，然后单击**确定返回**截面扫描对话框。
12. 从**标称值方法**区域的**标称值**列表中选择适合的标称值模式。
13. 在**标称值方法**区域的**公差**框中，键入最小补偿测头半径的公差值。
14. 在**执行控制**区域中从**执行列表**中选择适当的执行模式。

15. 若使用薄件，在图形选项卡上的**厚度框**中键入零件的厚度。
16. 如果需要，在执行选项卡上的区域中选择任何复选框。
17. 如果使用模拟测头，应考虑使用**控制点**选项卡优化扫描的运行。
18. 在理论路径区域的**路径定义**选项卡中单击**生成**按钮，从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。在生成截面扫描时，PC-DMIS 将在起点开始扫描，并按照所选的方向进行扫描，跳过孔，直到到达边界点。
19. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。
20. 如果需要，使用同一选项卡中的**样条路径 区域**将理论路径拟合到样条路径。
21. 根据需要对扫描进行其他修改。
22. 点击**创建**按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。
23. 创建扫描后，PC-DMIS 会以指定的增量沿选择的轴上转换边界点。PC-DMIS 会在“图形显示”窗口中显示新边界。它会让您再次使用**截面扫描**对话框来创建其他截面扫描。

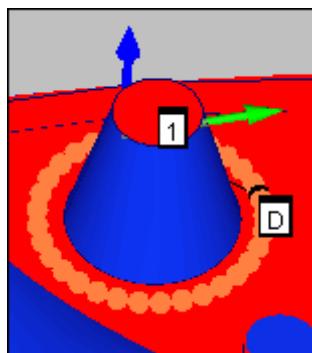
执行旋转高级扫描



旋转扫描对话框

插入 | 扫描 |

旋转扫描方法会从给定点开始以指定的半径围绕此点扫描平面。无论曲面有任何更改，都会维持此半径。此程序使用测量圆弧的起点和终点。它还包括方向点，以定义从开始到结束的方向。



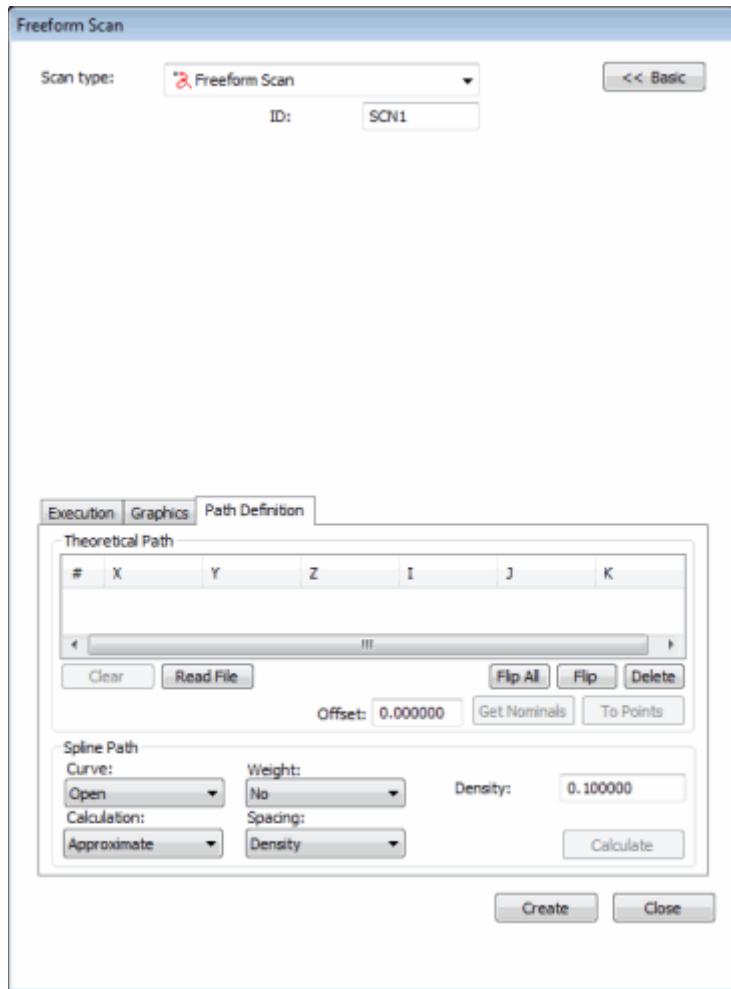
一个围绕圆锥的旋转扫描例子

若要创建旋转扫描

1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
3. 从子菜单中选择**插入 | 扫描 | 旋转**。屏幕上会出现**旋转扫描对话框**。
4. 若要使用自定义名称，在 **ID** 框中键入扫描的名称。
5. 确定旋转扫描的中心点。可以以下两种方法之一操作：
 - 选择**选择中心**复选框，然后在部件上单击一个点。
 - 手动将圆的中心位置输入到**XYZ**和**IJK**对话框中。
6. 在**半径**框中键入旋转扫描的半径值。键入半径后，PC-DMIS 将在“图形显示”窗口的零件模型上绘制扫描位置。
7. 确认扫描的**XYZ**中心和**IJK**信息的正确。
8. 取消**选择 中心**复选框。
9. **从方向 1**
技术列表中选择相应的技术。根据选定的技术，在**最大增量、最小增量、最大角度**和**最小角度**框中键入适合的增量和角度值。
10. 如果扫描经过多个曲面，应考虑在“图形选项卡”中使用选择复选框选择多个曲面。
11. 为旋转扫描添加 1 点（起点）、D 点（扫描方向）和 2 点（终点）。这将选择要扫描的曲线。如果要扫描整个圆周，则删除 2 点。按照“**边界点区域**”主题中所述的相应步骤选取这些边界点。

12. 从触测控制区域中的**触测类型**列表中选择要相应的触测类型。
13. 对**初始矢量**区域中的矢量进行所需的更改。要执行此操作，请双击矢量，对**编辑扫描项**对话框进行更改，然后单击**确定**返回**旋转扫描**对话框。
14. 从**标称值方法**区域的**标称值**列表中选择适合的**标称值模式**。
15. 在**标称值方法**区域的**公差**框中，键入最小补偿测头半径的公差值。
16. 在**执行控制**区域中从**执行**列表中选择适当的**执行模式**。
17. 若使用薄件，在**图形**选项卡上的**厚度**框中键入零件的厚度。
18. 如果需要，在**执行**选项卡上的区域中选择任何复选框。
19. 如果使用模拟测头，应考虑使用**控制点**选项卡优化扫描的运行。
20. 在**理论路径**区域的**路径定义**选项卡中单击**生成**按钮，从而在“**图形显示**”窗口中的**CAD**模型上生成扫描预览。在生成扫描时，PC-DMIS将在起点开始扫描，并按照所选的方向进行扫描，直到到达边界点。
21. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从**理论路径**区域一次选择一个点并按**Delete**键。
22. 根据需要对扫描进行其他修改。
23. 点击**创建**按钮。C-DMIS 在“**编辑**”窗口中插入扫描。

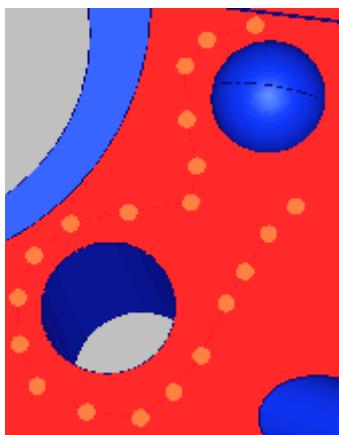
执行自由高级扫描



自由扫描对话框

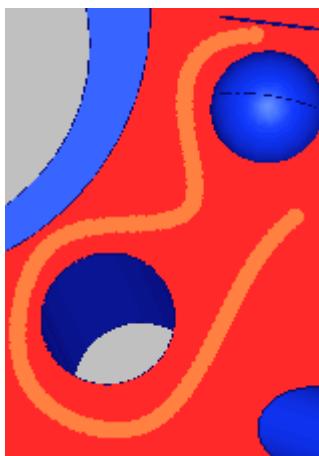
自由形状扫描对话框可用于在曲面上创建任何路径。扫描将遵循该路径。此路径完全取决于您的操作：它可为曲线或直线，可有较多或较少的测点。

样条路径前的**自由形状扫描**示例：



样条路径前的自由形状扫描

样条路径后的自由形状扫描示例：



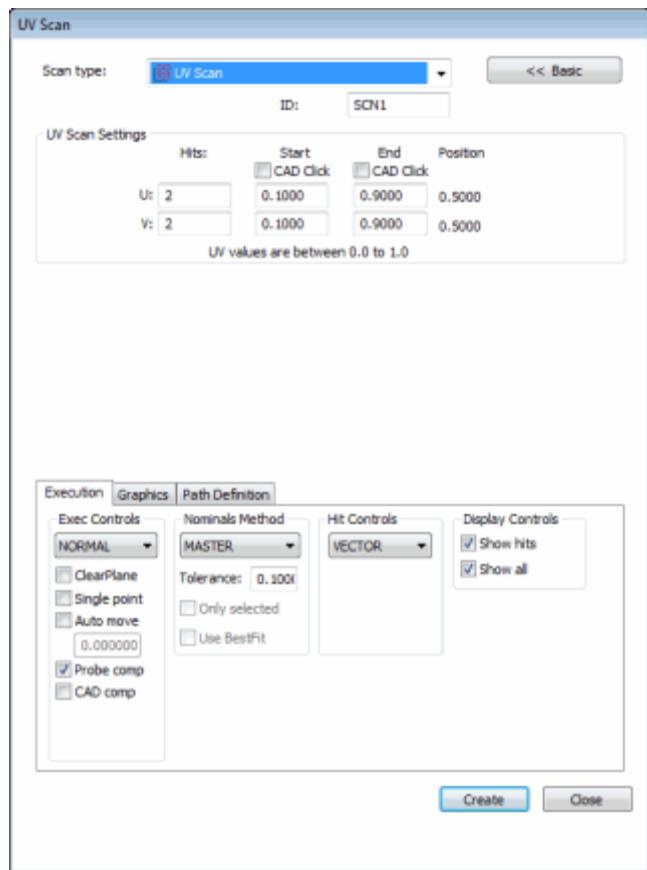
样条路径后的自由形状扫描

若要创建自由形状扫描

1. 单击**高级**，在此对话框底部显示选项卡。
2. 在**执行**和**图形**选项卡上选择所需的项目。
3. 选择**定义路径**选项卡。
4. 定义理论路径。将测点添加至**理论路径框**。要执行此操作，单击“图形显示”窗口内的零件曲面。每次单击后，零件图纸上会出现一个橘色点。一旦您有五个点或以上时**样条路径**区域内的**计算**按钮开始启用。

5. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从**理论路径区域**一次选择一个点并按 Delete 键。
6. 如果需要，选择**样条路径区域**的项，然后单击**计算**。这将创建一条延着理论点的样条曲线，并在理论路径区域的重新计算点用于产生一个测头移动的更平滑的路径
7. 单击**创建生成扫描**。若启用了 PC-DMIS 的 AutoWrist 方法，但没有任何校验过的测尖，则在添加需要校验的新测尖时 PC-DMIS 将显示消息通知您。在其他所有情况下，PC-DMIS 会询问您是否使用所需测尖角度最近校验的测尖，或以所需的角度添加未校验的测尖。

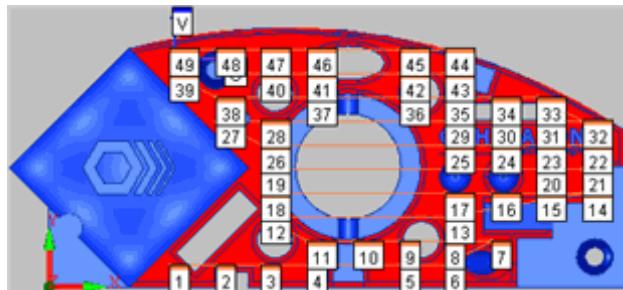
执行 UV 高级扫描



UV扫描对话框

插入 | 扫描 | UV 扫描允许您轻松扫描已知 CAD

模型的任何曲面上的点行（类似于面片扫描）。此扫描不需要大量的设置，因为它使用 CAD 模型定义的 UV 空间。

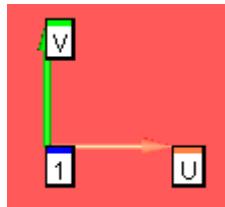


例如UV扫描每个标识的触测

 当 PC-DMIS 用这个对话框设置 UV 扫描时，它会从 CAD 获得各个点，并使用每个点的理论数据。

创建 UV 扫描

1. 启用 TTP 测头。
2. 将 CAD 模型置于立体模式。
3. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
4. 访问 UV 扫描对话框（**插入 | 扫描 | UV**）。
5. 若要使用自定义名称，在 **ID** 框内键入扫描的名称。
6. 在图形选项卡上，单击选择复选框。
7. 单击要扫描的曲面。PC-DMIS 会突出显示选择的曲面。PC-DMIS 会显示 CAD 模型上的 *U* 和 *V*，表示每个轴的方向。



UV轴箭头指示在CAD表面上

8. 在图形选项卡上，清除选择复选框。
9. 在 UV 扫描设置区域中选择开始单击 CAD 复选框。
10. 单击选择的曲面，以设置扫描的起点。您单击曲面的位置也会指示 UV 扫描开始的位置。这会定义用于扫描的矩形区域的第一个棱角。



此时，UV

扫描会支持多个曲面的扫描。若要扫描多个曲面，按照您要扫描的次序单击待扫描的曲面。PC-DMIS 将显示一个数字，指示曲面编号以及 U 和 V 方向箭头。在执行过程中，PC-DMIS 会在第一个曲面上执行 UV 扫描，之后在第二个曲面上执行 UV 扫描，依次类推。

11. 在 UV 扫描设置区域中选择结束单击 CAD 复选框。
12. 在选中的曲面上再次单击来设定扫描结束的点。PC-DMIS 会再次在 CAD 模型上显示一个 U 和 V。这将定义扫描的第二个矩形区域。

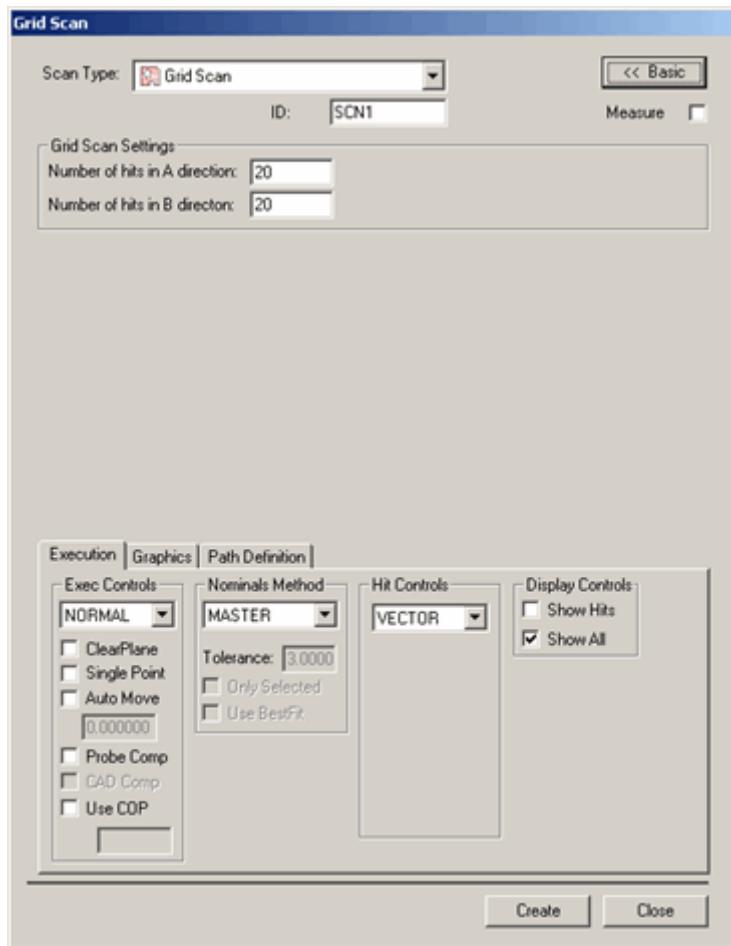


PC-DMIS 根据单击的点沿 U 和 V

轴自动定义起点和终点。可以通过切换 U 和 V 行中的起始和结束值改变扫描的方向。注意，UV 空间使用 0.0 到 1.0 之间的数字代表整个曲面。因此在大多数情况下，0.0, 0.0 位于与 1.0, 1.0 相对的对角。但剪裁曲面可能在 U 和 V 方向上以大于 0.0 的值开始，并以小于 1.0 的值结束。

13. 从触测控制区域中的**触测类型**列表中选择要相应的触测类型。可以选择**矢量点**或者**曲面点**。
14. 根据需要修改其他任何选项。
15. 在理论路径区域的**路径定义**选项卡中选择**生成**按钮，从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。PC-DMIS 会在 CAD 模型上绘制应触测的位置。注意，UV 扫描自动跳过沿曲面方向的任何障碍孔。
16. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。
17. 根据需要对扫描进行其他修改。
18. 点击**创建**按钮。PC-DMIS 将扫描插入“编辑”窗口中，并在“图形显示”窗口中绘制测头将在模型曲面上进行扫描的路径。

执行栅格高级扫描



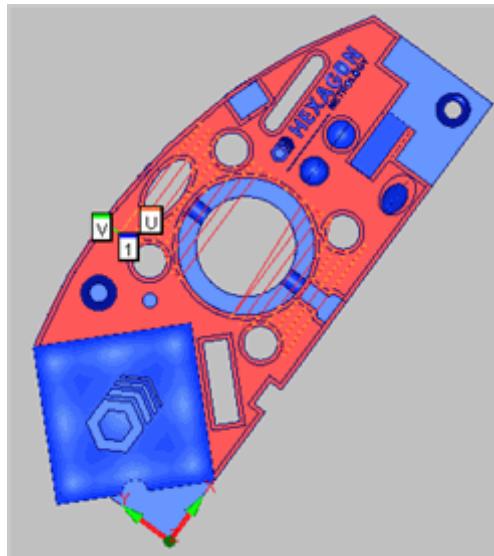
栅格扫描对话框

与 UV

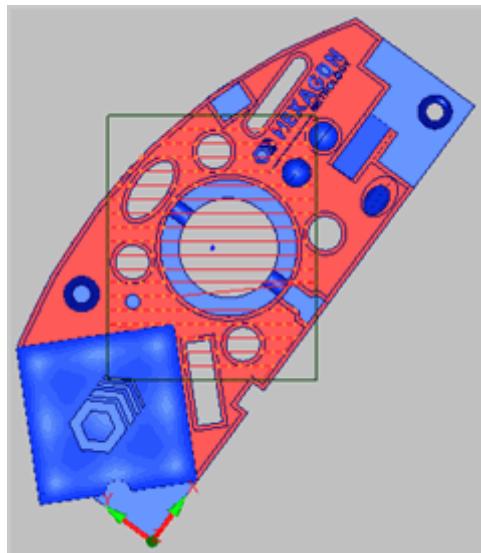
扫描类似，网格扫描可用于在可见的矩形内创建网格点，之后将这些点投射于任何所选择曲面的顶部。UV

扫描和网格扫描的方法类似，即它们都会在所选择的区域内构造和间隔点。但是，UV扫描可使用 CAD 模型定义的 UV 空间。可使用网格扫描以当前 CAD 方向创建网格，然后将点投射到 CAD 曲面上。

参见这两种图表：



图表1-在2D旋转工件上UV扫描



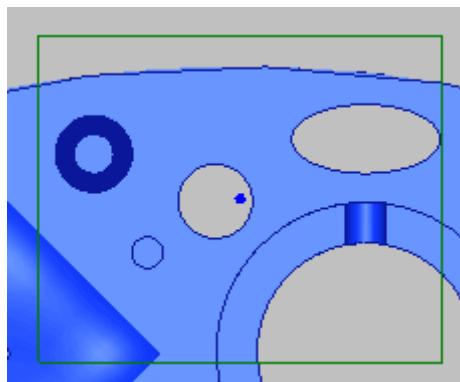
图表2-在2D旋转工件上栅格扫描

图1显示的为一个 2D 旋转样品块的上曲面的 UV 扫描。图 2 显示同样样品块的网格扫描。注意图 1 中的 UV 扫描的轴与选定曲面的 XY 轴的吻合程度。网格扫描却不这样，点与矩形视图相吻合。创建时，不管零件方向，网格扫描创建在选中曲面上的点。

创建栅格扫描

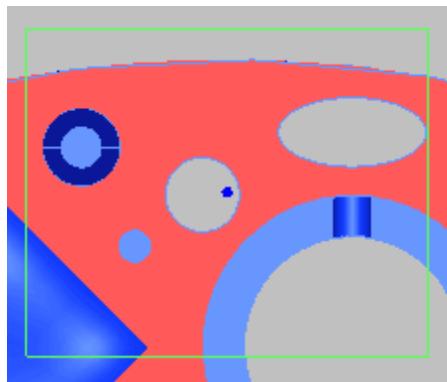
1. 启用 TTP 测头。

2. 将 CAD 模型置于立体模式。
3. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式中。
4. 访问**栅格扫描对话框** (**插入 | 扫描 | 栅格**)。
5. 若要使用自定义名称，在 **ID** 框内键入扫描的名称。
6. 单击并将屏幕上的**矩形**拖动到要显示在扫描中的曲面上。该矩形可定义将投射到 CAD 曲面上的网格边界。



在多个曲面上取点的矩形示例

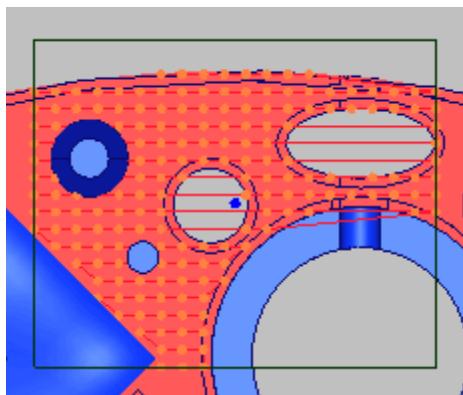
7. 在图形选项卡上，选中**选择**复选框。
8. 单击曲面或者需要扫描的曲面。PC-DMIS 会突出显示所选的**选中曲面**。



选择以红色亮显的曲面示例

9. 从触测控制区域中的**触测类型**列表中选择要相应的触测类型。可以选择**矢量点**或者**曲面点**。

10. 在格栅扫描设置区域，指定A到B方向的测点数并且在选择的曲面上设定点的间距。
11. 根据需要修改其他任何选项。仅可从标称值列表中选择 **MASTER**。
12. 在理论路径区域的路径定义选项卡中选择**生成**按钮，从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。PC-DMIS 会在 CAD 模型上绘制点。即使矩形的边界包括其他曲面，也不会在您未选择的任何曲面上绘制点。



显示生成点的实例。注意，点只会出现在选中的曲面（红色）上，即使其他曲面（蓝色）用方形做边界。

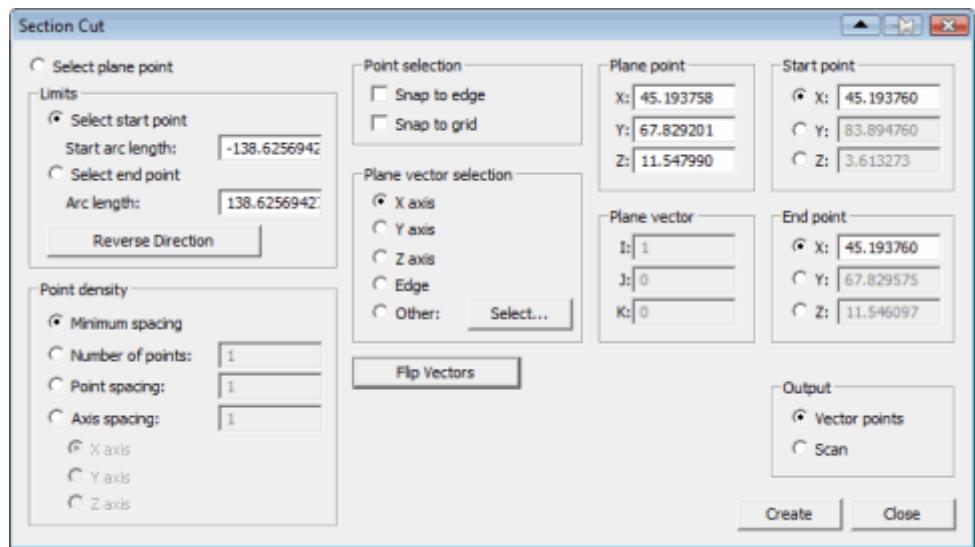
13. 如需要，您可删除各点。要执行此操作，从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。

14. 根据需要修改扫描。

15. 单击**创建**按钮。PC-DMIS 将扫描插入“编辑”窗口中，并在“图形显示”窗口中绘制测头将在模型曲面上进行扫描的路径。

使用部分切割

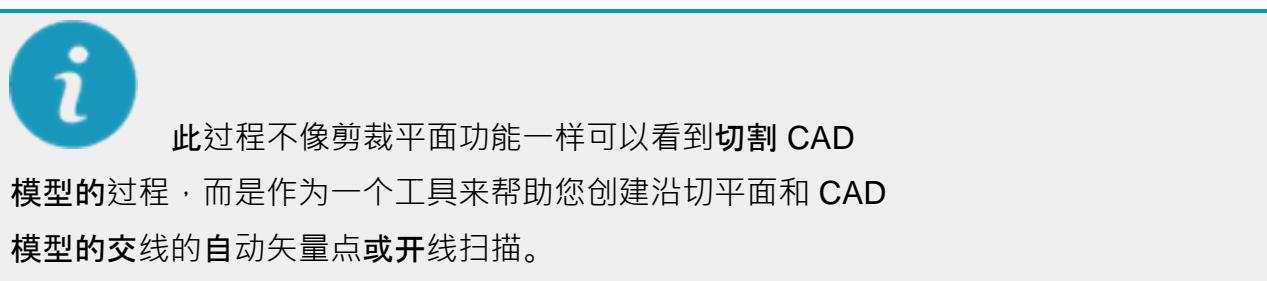
插入 | 扫描 | 截面切割菜单项显示**截面切割**对话框。



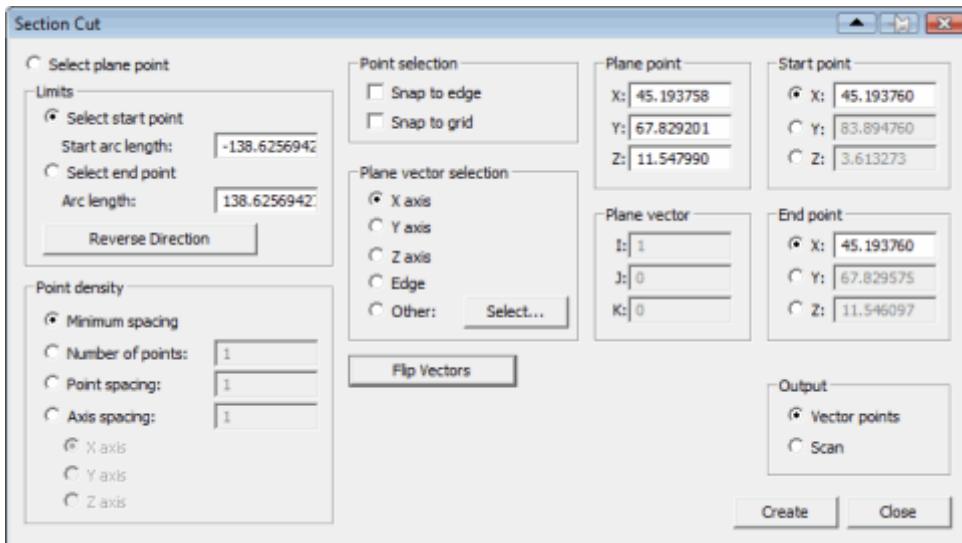
截面切割对话框

使用此对话框指定与 CAD

模型相交的切平面。除了交线，您还可以定义起点和终点（在两者之间创建多个点）。从这些点，您可以选择创建矢量点特征或开线扫描。



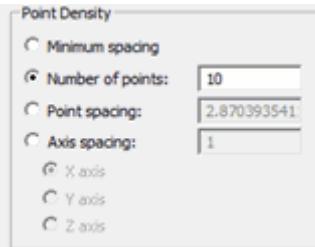
部分切割对话框描述



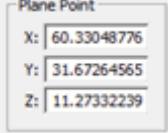
截面切割对话框

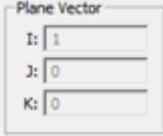
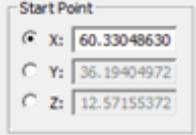
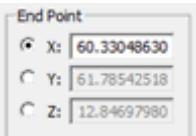


项目	描述
选择平面点选项	在 CAD 模型上选择一个点。该点将变为切平面点。
界限区域	指定沿相交方向的起点和终点。您可在“图形显示”窗口中选择点，或指定弧长，精确定位起点和终点。 选择起点 - 通过在“图形显示”窗口中选择起点，来选定截面切割的起点。 选择黑色相交线上的点。屏幕上显示的红点表示起点位置。
开始弧长 -	

	<p>使用此框根据切平面点来精确定位起点。键入切平面点投影到截面切割的投影点与起点之间的弧长。也可定义负数。</p> <p>选择终点 -</p> <p>通过在“图形显示”窗口中选择终点，来指定截面切割的终点。选择黑色相交线上的点。屏幕上显示的紫点表示终点位置。</p> <p>弧长 -</p> <p>使用此框精确定位终点。您键入的值是起点和终点之间的弧长。也可定义负数。</p> <p>逆向 -点击该按钮可以反转从平面点测量的弧长度的方向。</p>
<p>点密度区域</p>  <p>The dialog box shows the following settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> Point Density <input type="radio"/> Minimum spacing <input checked="" type="radio"/> Number of points: 10 <input type="radio"/> Point spacing: 2.870393541 <input type="radio"/> Axis spacing: 1 <input checked="" type="radio"/> X axis <input type="radio"/> Y axis <input type="radio"/> Z axis 	<p>使用此区域可控制起点与终点之间的点距和点数。</p> <p>最小间距 -</p> <p>该选项使用基于沿截面切割的曲率的最小点数。如果曲面是平坦的，只会在起点和终点创建两个点。如果曲面是弯曲的，则将会创建更多的点。曲面上创建的点数量取决于在OpenGL选项对话框设置的布局倍率值。请参见PC-DMIS核心文档中“设置首选项”一章中的“更改OpenGL选项”主题。</p> <p>点数 -键入要创建的点数。PC-DMIS在起点和终点之间均匀分布这些点。</p>

	<p>点距 - 指定点与点之间的弧长。</p> <p>轴距 -</p> <p>此选项可限制仅沿选中的轴创建点。一旦选中此选项，将启用X 轴、Y 轴和 Z 轴选项。使用此选项旁边的框可定义选中轴方向上的点间距。例如，若选择了X 轴，则将根据您指定的值在X 轴方向上分布点。</p>
	<p>使用此区域可指定平面、起点和终点的对齐选项。</p> <p>对齐到边缘 - 该复选框可以决定 PC-DMIS 是否对齐到最近的曲面边缘或曲面边界的点。</p>
点选择区域	<p>捕捉至网格 - 该复选框决定了 PC-DMIS 是否捕捉点至最近的网格相交。即使在没有显示 3D 网格的情况下，也可以使用对齐到网格功能。要启用 3D 网格，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“设置屏幕视图”主题。</p> <p>如果您同时选择吸附到边缘和吸附到网格线，PC-DMIS会吸附到最近的网格线与曲面边缘或边界交汇的点。</p>
平面矢量选择区域	<p>使用此区域可指定切平面法矢量。</p> <p>X 轴 - 将切平面设为垂直于 X 轴矢量 (1,0,0)。</p> <p>Y 轴 - 将切平面设为垂直于 Y 轴矢量 (0,1,0)。</p>

	<p>Z 轴 - 将切平面设为垂直于 Z 轴矢量 (0,0,1)。</p> <p>棱边 -</p> <p>将切平面设为垂直于最近的曲面边界切矢量。只要您选择平面点，平面法线就会更新为最近的曲面边界切矢量。</p> <p>其他 -</p> <p>手动定义切平面法矢量值。选中后，在平面矢量区域输入 IJK 值。或者，您可单击选择按钮，选择 CAD 模型上的特征，以用作法矢量。</p> <p>选择 -</p> <p>显示选择点对话框，您可使用此对话框来选择要用作切平面法矢量的特征。此对话框在 PC-DMIS 核心文档的“编辑 CAD 显示”一章的“转换 CAD 模型”主题中进行了描述。</p>
平面点区域	<p>该区域显示了平面点的XYZ值。您可以在X、Y 和 Z框中手动修改这些值。如果您指明的点没有位于CAD曲面，则实际使用的点将会投影到CAD模型上。</p>  <p>当您完成手动编辑这些值并从平面矢量选择区域选择边缘选项按钮后，用作平面矢量的曲面边界矢量将使用与先前平面矢量最接近的矢量。换句话说，与先前平面矢量最接近平行的边界矢量将用作新的平面矢量。</p>
平面矢量区域	<p>该区域显示了平面法线矢量的IJK值。您可以通过在I、J和K输入框输入新值手工修改这些值。</p>

	
起点区域 	此区域显示起点的 XYZ 值。您也可使用此区域定义或调整选定轴的值。其他两条轴根据交线计算。
终点区域 	该区域显示了终点的XYZ值。您也可使用此区域定义或调整选定轴的值。其他两条轴根据交线计算。
输出区域 	使用此区域可确定从截面切割创建的特征类型。仅在您单击创建按钮后，PC-DMIS 才创建输出特征。 矢量点 - 该选项指明了必须创建的矢量点。 扫描 - 此选项指定应从这些点创建的开线扫描。
翻转矢量 按钮	创建截面切割后，PC-DMIS 使用绿色箭头识别截面切割中的点数。翻转矢量按钮也将变得可选。此按钮可翻转表示点的矢量的绿色箭头，使得它们指向相反的方向。
创建按钮	从截面切割创建指定的特征。特征类型取决于在输出区域中选择的选项。
关闭按钮	关闭截面切割对话框。

创建截面

定义这些信息可以创建截面切割：

- 剖面
- 剖面图的起点
- 剖面图的终点

步骤1：定义切割平面

指明平面的一个点，定义切割平面。您可以用以下两种方式实现：

- 您可以选择选择平面点选项。然后再 CAD 模型上单击一个点。
- 您可以在平面点区域手工输入 XYZ 值。

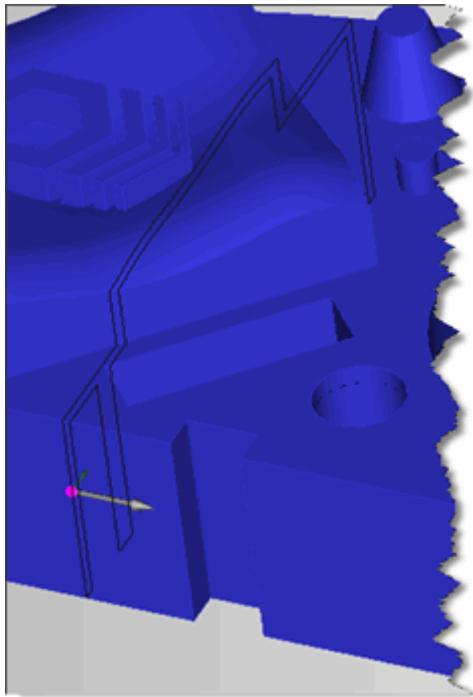
定义切割平面后，PC-DMIS

会绘制一个灰色箭头，指示此平面点以及切割平面法线的方向。此外，PC-DMIS 在 CAD

模型上绘制折线（或一个或多个连接线）。这代表带整个 CAD

模型中的曲面的平面（被称为“切割平面”）的交叉。若有多个截面切割，将绘制为不同颜色的多边形，以显示极小的表面间距。由于您尚未定义起点和终点，将以红色和紫色的点

分别表示起点和终点，这些点最初将显示在平面点位置处的 CAD 模型上：



一个样例平面点（通过灰色箭头表示）和一个切割平面（通过黑色线表示）绘制在 CAD 模型之上



如果平面与模型在不止一个位置交汇，PC-DMIS会绘制所有的交接。

定义切割平面点后，可以有选择地指定切割平面的法矢量。法矢量默认为 $(1,0,0)$ 。通过选择“平面矢量选择”区域中的选项，您可修改此法矢量。这将验其中一条选定轴转换法线。您也可定义自定义矢量。

步骤2：沿截面切割定义起点和终点

现在已经定义了切割平面，接下来就需要定义截面方向的起点和终点。您可根据您的首选项，结合使用不同方法定义起点和终点：

方法 1：单击 CAD

1. 选择**选择起始点**选项，然后在构成截面的黑线上点击一点。这定义了沿截面离开**平面点的距离**，并将距离填入**起始弧长**。PC-DMIS会将选中点的XYZ值存放到**起点区域**。
2. 选中**选择起点**选项，然后单击构成同一个截面切割的另外一个点。此操作将定义起点和终点之间的弧段。PC-DMIS 将把选定点的 XYZ 值填入**终点区域**。

方法 2：键入圆弧值

1. 通过在开始弧距离输入框输入值指明到**平面点的距离**定义起点。
2. 通过指明弧长度定义终点。通过在**弧长度**输入框输入值完成。

方法 3：键入 XYZ 值

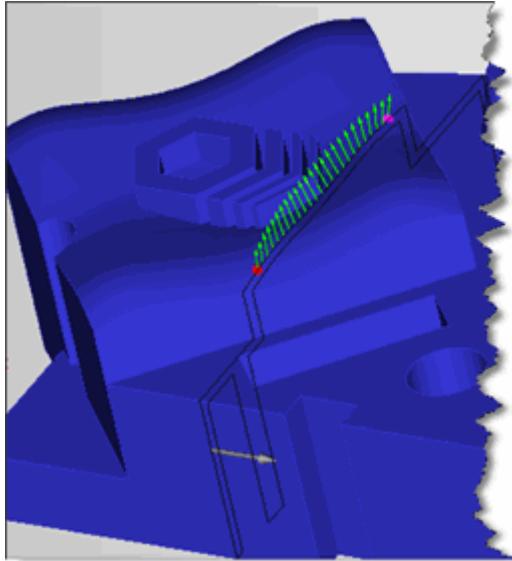
要定义起点和终点，在**起点和终点区域**中键入 XYZ 值。



起点和**终点**必须位于同一个截面切割。例如，如果两个曲面的间隔将您的截面切割切断为多个切割，则起点和终点必须定义于同一个切割上。如果您试图在不同的截面切割上选择起点和终点，则第一次选择的点会被删除，你需要重新选择。

CAD模型上会出现一个代表起点的红点，和一个代表终点的紫点。此外，PC-DMIS会沿着界面绘制一个绿色箭头，展示将要创建截面切割的点的位置。如果曲面是弯曲的，则会绘制多个箭头。如果曲面是平的，则这些绿色箭头只会绘制在起点和终点（因为**点密度区域**中默认选择的是**最小密度**）。

您可以在**点密度区域**修改该选项，控制两点之间的点数量：



一个样例截面切割展示了从起点（红点）到终点（紫点）平均间隔的 25 个点

步骤 3：定义和创建输出

1. 在输出区域选择所需的输出格式。可输出单独的自动矢量点，也可输出包含多个点的开线扫描。
2. 根据需要修改其他控件。这些控件可让您自定义能影响此平面、起点和终点、点距以及所创建的特征类型的参数。
3. 单击**创建按钮**，创建输出特征或扫描。

PC-DMIS 在测量例程中创建一个或多个指定的特征。

沿截面切割修正法线的方向

绿色箭头代表了点的曲面法线矢量。截面切割算法设计为确保沿截面切割的曲面法线矢量不会在跨越多个曲面时时发生翻转。然而，这些矢量可能会全部被指向错误的方向（在零件内部）。如果这些箭头全部指向错误方向，点击**翻转矢量修正**。

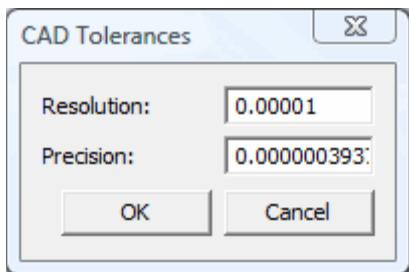
修正曲面间的间隔

因为曲面间的小间隔，有时截面切割会在它围绕完零件之前结束。这是由于CAD的分辨率低于间隔距离。只要曲面之间的间隔大于CAD分辨率，就会切断截面切割。为了便于

识别间隔，不同的截面切割使用不同的颜色绘制。您可以在**CAD公差**对话框通过增大CAD的分辨率来修正该问题。

操作如下：

1. 选择编辑 | 图形显示窗口 | CAD 公差。屏幕上出现 **CAD 公差**对话框。



“CAD 公差”对话框

2. 将分辨率更改为大于间隙距离的值。可能要尝试几次才能找出足够大的分辨率值。
有关更多信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“更改 CAD 公差”。
3. 单击确定。
4. 创建截面切割。

该截面切割现在会跳过间隔。

创建快速扫描

使用快速扫描功能可从折线或平面创建开线扫描。快速扫描可使用 CAD 的曲线模式或表面模式创建。有关这些模式的更多信息，请参阅 PC-DMIS 核心文档中“编辑 CAD 显示”一章中的“在曲线和表面模式之间切换”。

折线必须为连续折线。可以是开放式或封闭式。

- 若折线为开放式，则生成的路径最大为折线末端减去等于使用中测头测尖半径的距离。
- 若折线为封闭式，将进行全面扫描。

生成的路径中两点之间的距离取决于扫描点密度。对于接触触发测头 (TTP), PC-DMIS 也将根据扫描点密度更新开线扫描对话框中**最大增量**选项的值。若要编辑扫描点密度, 请更改**参数设置**对话框 (F10 或**编辑 | 喜好设定 | 参数**) 中测头选项选项卡上的**点密度**的值。

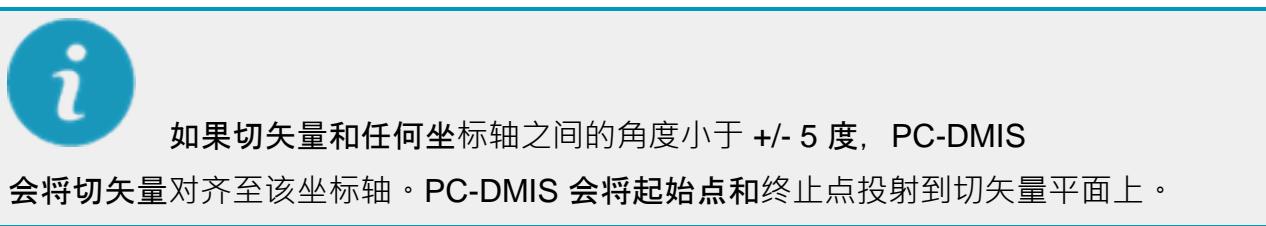
在折线上创建快速扫描

1. 在编辑窗口中单击以定义新功能的插入位置。
2. 选择曲线模式 (**操作 | 图形显示窗口 | 更改曲线模式/表面模式**)。
3. 在“图形显示”窗口中, 将指针悬停在 CAD 元素折线上。
4. 按 Ctrl+Shift 并单击想要开始扫描的折线。将指针以扫描方向沿着折线拖动。
5. 释放鼠标按钮。C-DMIS 将创建扫描并将其插入光标位置。

在表面上创建快速扫描

可在一个表面上创建快速扫描

1. 在编辑窗口中单击以定义新功能的插入位置。
2. 选择曲线模式 (**操作 | 图形显示窗口 | 更改曲线/表面模式**)。
3. 在“图形显示”窗口中, 将指针悬停要扫描的表面上。
4. 按 Ctrl+Shift 并单击想要开始扫描的位置。将指针拖至想要停止扫描的位置。
5. 释放鼠标按钮。C-DMIS 将创建扫描并将其插入光标位置。



如果切矢量和任何坐标轴之间的角度小于 +/- 5 度, PC-DMIS 会将切矢量对齐至该坐标轴。PC-DMIS 会将起始点和终止点投射到切矢量平面上。

使用扫描测头的结果

若使用中的测头为扫描类型的测头, PC-DMIS 将如下设置开线扫描对话框中的参数:

- **方向 1 方法列表** = 零值筛选器
- **执行列表** = 已定义
- **标称值列表** = 查找标称值

PC-DMIS 使用对话框中的其他参数创建扫描。



若曲线为 3D, PC-DMIS 将选择**开线扫描**对话框中**执行**选项卡上的 **CAD 补偿**复选框。若曲线为 2D, PC-DMIS 将取消选择该复选框。

使用接触触发测头的结果

若使用中的测头为接触触发类型的测头, PC-DMIS 将如下设置**开线扫描**对话框中的参数：

- **方向 1 方法** = 线
- **执行列表** = 普通
- **标称值列表** = 主要
- **测点类型列表** = 矢量

PC-DMIS 使用对话框中的其他参数创建扫描。

执行基本扫描

PC-DMIS

支持属于“基础扫描”分类的扫描。这些扫描为基于特征的扫描。即，您将定义与相应参数一起测量的特征，例如，圆或圆柱。然后，PC-DMIS 将执行使用合适基本扫描功能的扫描。

如果 TTP 或模拟测头置于 DCC 模式下，**插入 | 扫描**菜单上将有以下基本扫描选项：圆、圆柱、轴、中心和直线。



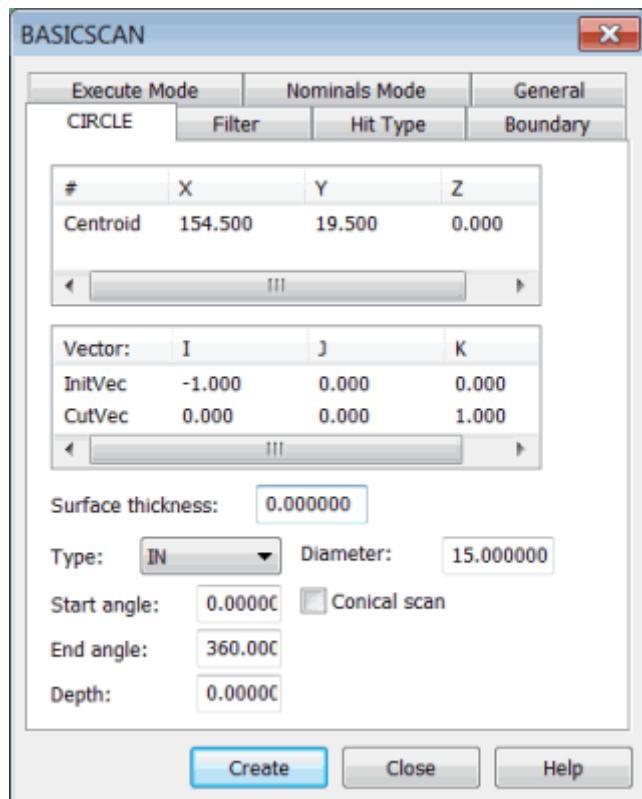
仅模拟测头上**有置中**选项。

PC-DMIS 中的高级扫描由基本扫描组成。当 PC-DMIS 不允许您从某列表中挑选基本扫描并为之创建高级选项，您可复制和粘贴基本扫描至已创建的高级扫描内。有关更多信息，请参见“执行高级扫描”。

本章将介绍**基础扫描**对话框中每个基础扫描选项卡上可用的常用功能。然后说明如何执行基础扫描。有关对话框中其他选项卡上各选项的详细信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“基本扫描对话框的常用功能”一章。

执行 圆 基本 扫描

要扫描圆特征，请选择**插入 | 扫描 | 圆**。屏幕上将出现**基本扫描**对话框中的**圆**选项卡。例如：



“基本扫描”对话框 - “圆”选项卡

此选项卡会采用诸如圆中心和直径之类的参数，并允许 CMM 执行扫描。

圆方法：

- 允许使用**筛选器**选项卡上的**距离或零值筛选器**类型。
- 仅允许使用**测点**类型选项卡上的**矢量**类型。
- 无需在**边界**选项卡上设置边界条件。

列中的质心参数为圆的中心。您可直接键入圆的中心。或者，从测量机或 CAD 软件获取圆的中心。

定义圆基本扫描

您可使用如下方法之一定义圆基本扫描：

- 直接键入值。请参见“圆基本扫描 - 键入方法”。

- 对圆上的点进行物理测量。请参见“圆基本扫描 - 测量点方法”。
- 单击“图形显示”窗口内 CAD 模型中的圆。请参见“圆基本扫描 - 曲面数据方法”或“圆基本扫描 - 线框数据方法”。

一旦创建扫描 · PC-DMIS

会将其插入“编辑”窗口内。以下为圆基本扫描的命令行在“编辑”窗口中的示例：



```
SCN2 =BASICSCAN/CIRCLE,NUMBER OF HITS=80,SHOW
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES
<25.399,76.2,0>,CutVec=0,0,1,IN
InitVec=-
1,0,0,DIAM=25.4,ANG=0,ANG=360,DEPTH=0,THICKNESS=0,CCE=NO,
PROBECOMP=YES,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0
FILTER/DISTANCE,1
EXEC MODE=FEATURE,USEHSSDAT=YES,USEDDELAYPNTS=NO
BOUNDARY/
HITTYPE/VECTOR
NOMS MODE=MASTER
ENDSCAN
```

圆基本扫描的一般定义

- 质心：圆的中心。
- **CutVec**：定义圆所在的平面。
- **InitVec**：点扫描的曲面法矢量被定义为 0 度。扫描将在此位置以**起始角开始**。它还可被认为是 ZeroAngleVector。

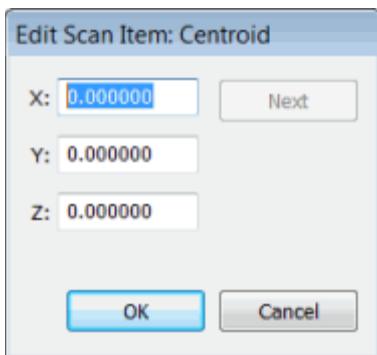
CutVec 和 **InitVec** 相互垂直。

圆 基本 扫描 - 键入 方法

使用此方法可键入圆质心的 X、Y 和 Z 值以及 **CutVec** 和 **InitVec** 矢量的 I、J 和 K 值。

1. 在基本扫描对话框（插入 | 扫描 | 圆）中的

列中双击质心。屏幕上会出现质心的编辑扫描项对话框：



编辑扫描项：质心对话框

该对话框的标题栏显示所编辑参数的 ID。

2. 编辑 X、Y 和 Z 值。

3. 要应用更改，单击**确定**。要取消更改并关闭对话框，单击**取消**。

4. 重复相同的程序，键入圆的 **CutVec**。

5. 重复相同的程序，键入圆的 **InitVec**。

有关**基本扫描**对话框和圆基本扫描的更多信息，请参见“执行圆基本扫描”。

圆 基本 扫描 - 测定 点 方法

若要在不使用 CAD 数据的情况下生成圆，则在孔中（或外柱上）采集三个测点。PC-DMIS 将使用这三个测点来计算圆。

您可采集更多测点。PC-DMIS 将会使用来自所有测点的数据。

- **基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 圆**）中显示的质心为计算的圆孔（或螺栓）中心。
- **CutVec** 根据三个测点所定义的平面自动计算出来。
- 圆的 **InitVec** 是根据用于计算圆的三个测点的第一个进行计算的。

- 计算的此**角度**为从第一个测点到最后一个测点的圆弧角度。

有关**基本扫描**对话框和圆基本扫描的更多信息，请参见“执行圆基本扫描”。

圆 基本 扫描 - 曲面 数据 方法

要使用曲面数据生成薄壁件圆，请执行以下步骤：

- 单击**曲面模式**图标。 
- 将光标放在所需圆的外部或内部。
- 在圆附近的曲面上单击一下。

基本扫描对话框（**插入 | 扫描 | 圆**）显示选择的 CAD 数据中圆的 X、Y 和 Z 中心点、直径和矢量。

- CutVec** 从圆所在平面采集。这来自 CAD 模型。
- InitVec** 是 CAD 模型中的任意设置。如果圆位于 Y 或 Z 平面上，则为 -X（若为内圆）。若是外圆，则为 +X。

如果圆位于 X 平面上，则为 +Z（若为内圆）。若是外圆，则为 -Z。

有关**基本扫描**对话框和圆基本扫描的更多信息，请参见“执行圆基本扫描”。

圆基本扫描 - 线框数据方法

您也可使用线框 CAD 数据生成圆形扫描。

若要生成圆：

- 在圆上的所需线附近单击。PC-DMIS 突出显示选择的线。
- 验证所选择正确的特征。

指出线后，**基本扫描对话框（插入 | 扫描 | 圆）** 将显示选择的圆的中心点和直径值。



如果基础 CAD

元素不是圆或弧，则可能需要更多次单击才能将特征确定。如果 PC-DMIS 未突出显示正确的特征，请在圆附近至少再单击两个点。

- **CutVec** 从圆所在平面采集。这来自线框 CAD 模型。
- **InitVec** 是线框 CAD 模型中的任意设置。如果圆位于 Y 或 Z 平面上，则为 -X（若为内圆）。若是外圆，则为 +X。

如果圆位于 X 平面上，则为 +Z（若为内圆）。若是外圆，则为 -Z。

有关**基本扫描对话框**和圆基本扫描的更多信息，请参见“执行圆基本扫描”。

圆基本扫描 - CAD数据方法

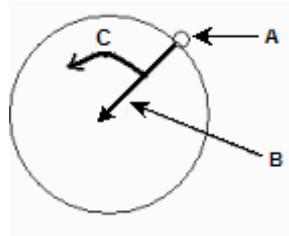
基本扫描对话框（插入 | 扫描 |

圆） 中的以下选项适用于此方法。有关此对话框和圆基本扫描的更多信息，请参见“执行圆基本扫描”。

类型

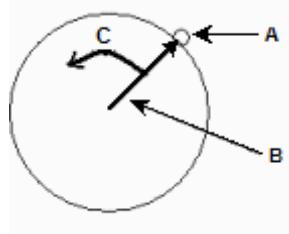
类型列表中的选项如下：

- 内：孔



A - 起点
B - 初始矢量
C - 角度

- 外 : 螺栓



A - 起点
B - 初始矢量
C - 角度

- 平面 : 在圆所在的平面上执行平面圆。

角度

角度框显示从起点开始的角度 (以扫描的度数进行表示)。可使用正角度和负角度。

- 正角度被视为逆时针。
- 负角度被视为顺时针。
- **CutVec** 为角度旋转所围绕的轴。

直径

直径框显示圆的直径。

深度

深度框显示在**切割矢量**的相反方向上应用的深度值。可使用正负值。



若圆的中心为 1.0,1.0,3.0, **CutVec** 为 0.0,0.0,1.0, 深度为 0.5, 则执行过程中圆中心将被设为 1.0, 1.0, 2.5。若对同一个圆使用 -0.5 的深度, 则在执行过程中将质心转变为 1.0,1.0,3.5。

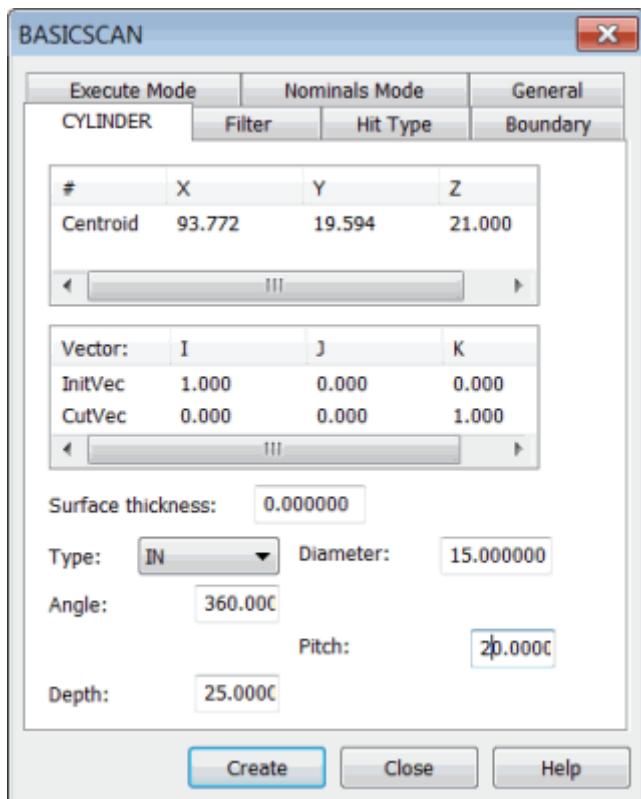
圆锥形扫描

圆锥形扫描 复选框可用于对圆锥或球体进行正确的扫描补偿。此复选框允许您在不垂直零件曲面时更加快速地进行扫描。PC-DMIS 根据需要继续监控触测力。

执行 柱体 基本 扫描

要扫描圆柱特征, 请选择**插入 | 扫描 |**

圆柱。屏幕上将出现**基本扫描**对话框中的**圆柱**选项卡:



“基本扫描”对话框 - “圆柱”选项卡

此选项卡可采用诸如圆柱的直径和间距等参数，并允许控制器执行扫描。

圆柱方法：

- 允许使用**筛选器**选项卡上的**距离**。
- 允许使用**测点类型**选项卡上的**矢量**类型。
- 无需在**边界**选项卡上设置**边界条件**。

#

列中的质心参数控制扫描的执行。此点是圆柱中心，执行开始的地方。您可直接键入圆柱的中心，或从测量机或 CAD 获取圆柱的中心。

定义圆柱基本扫描

您可使用以下方法之一定义圆柱基本扫描：

- 直接键入值。请参见“圆柱基本扫描 - 键入方法”。
- 对圆柱上的点进行物理测量。请参见“圆柱基本扫描 - 测量点方法”。
- 单击“图形显示”窗口内 CAD 模型中的圆柱。请参见“圆柱基本扫描 - 曲面数据方法”或“圆柱基本扫描 - 线框数据方法”。

一旦创建扫描 · PC-DMIS

会将其插入“编辑”窗口内。以下为圆柱基本扫描的命令行在“编辑”窗口中的示例：



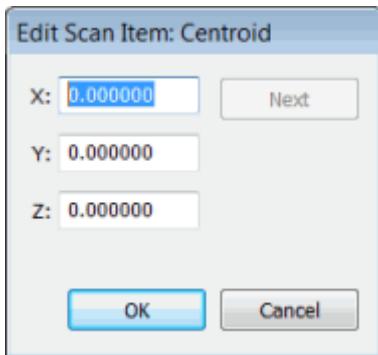
```
SCN1 =BASICSCAN/CYLINDER,NUMBER OF HITS=80,SHOW  
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES  
<25.399,25.4,0>,CutVec=0,0,1,IN  
InitVec=-1,0,0,DIAM=25.4,ANG=360,PITCH=5,DEPTH=0,THICKNESS=0,  
PROBECOMP=YES,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0  
FILTER/DISTANCE,1  
EXEC MODE=FEATURE,USEHSSDAT=YES,USEDDELAYPNTS=NO  
BOUNDARY/  
HITTYPE/VECTOR  
NOMS MODE=MASTER  
ENDSCAN
```

柱体 基本 扫描 - 键 入 方 法

使用此方法可键入圆柱质心和矢量的 X、Y 和 Z 值。

1. 在基本扫描对话框（插入 | 扫描 | 圆柱）中的

列中双击所需的质心点。屏幕上会出现质心的**编辑扫描项**对话框：



编辑扫描项：质心对话框

该对话框的标题栏显示所编辑参数的 ID。

2. 编辑 **X**、**Y** 和 **Z** 值。
3. 要应用更改，单击**确定**。要取消更改并关闭对话框，单击**取消**。
4. 使用相同的程序编辑圆柱的 **CutVec** 和 **InitVec** 值。

有关**基本扫描**对话框和圆柱基本扫描的更多信息，请参见“执行圆柱基本扫描”。

柱体 基本 扫描 - 测定 点 方法

要在不使用 CAD 数据的情况下生成圆柱，请执行以下步骤：

1. 在曲面上采三个点，以查找柱体的轴矢量。
2. 在孔里（或键上）触测三次。PC-DMIS 将使用所有三个测点来计算柱体的直径。

您可采集更多测点。PC-DMIS 将会使用来自所有测点的数据。

- **基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 圆柱**）中显示的质心为计算的圆孔（或螺栓）中心。
- **CutVec** 为圆柱的轴。
- 圆柱的 **InitVec**

是根据用于计算圆柱直径的最后三个测点的第一个测点进行计算的。

- 角度将计算为用来计算柱体直径的第一个测点（或触测）到最后一次单击所成弧的角度。

有关**基本扫描**对话框和圆柱基本扫描的更多信息，请参见“执行圆柱基本扫描”。

柱体 基本 扫描 - 曲面 数据 方法

要使用曲面数据生成柱体，请执行以下步骤：

1. 单击**曲面模式**图标。 
2. 将光标放在所需柱体的外部或内部。
3. 在柱周围曲面上单击一下。

一旦已指定第三个点，**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 圆柱**）将显示所选择金属板圆柱的 CAD 数据的中心点和直径。

若 PC-DMIS 检测到其他鼠标点击，PC-DMIS 将会找到所有测点附近的最佳圆柱。

- **CutVec** 为圆柱的轴。
- 圆柱的 **InitVec** 是根据第一次单击进行计算的。
- 角度将计算为从第一次单击到最后一次单击所成弧的角度。

有关**基本扫描**对话框和圆柱基本扫描的更多信息，请参见“执行圆柱基本扫描”。

圆柱基本扫描 - 线框数据方法

您也可使用线框 CAD 数据生成圆柱扫描。

要生成圆柱，请执行以下步骤：

1. 在圆柱上的所需线附近单击。PC-DMIS 突出显示选择的线。
2. 验证所选择正确的特征。

指出线后，**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 圆柱**）将显示选择的圆柱的中心点和直径值。



如果基础 CAD 元素不是圆柱或圆弧，则需要更多次单击才能识别特征。若 PC-DMIS 无法突出显示正确的特征，请尝试单击圆柱的至少另外两个位置。

- **CutVec**：此矢量是圆柱的轴，并且是执行扫描时所在的平面。
- **InitVec**：此矢量说明测头将采集第一个测点以开始扫描时所处的方向。此矢量是根据数据条目的模式进行计算的。此矢量和 **CutVec** 相互垂直。

有关**基本扫描**对话框和圆柱基本扫描的更多信息，请参见“[执行圆柱基本扫描](#)”。

柱基本扫描 - CAD数据方法

圆柱的 **InitVec** 是根据第一次点击（用于通过此方法计算圆柱）进行计算的。

基本扫描对话框 (插入 | 扫描 |

圆柱) 中的以下选项适用于此方法。有关**基本扫描**对话框和圆柱基本扫描的更多信息，请参见“[执行圆柱基本扫描](#)”。

类型

类型列表中的选项如下：

- **内**：孔
- **外**：螺栓

角度

角度框显示从起点开始的角度（以扫描的度数进行表示）。可使用正角度和负角度。

- 正角度被视为逆时针。
- 负角度被视为顺时针。

- **CutVec** 为角度旋转所围绕的轴。此角度可大于 360 度，扫描可继续超过一个旋转。



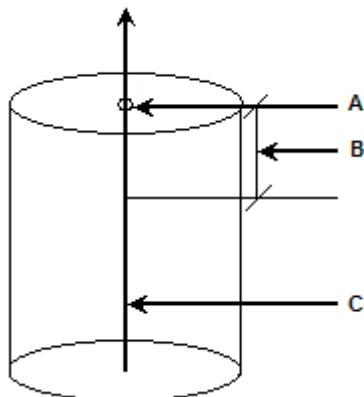
如果您已输入 720 度的角度，则扫描将会执行两次旋转。

直径

直径框显示柱体的直径。

深度

深度框显示应用于 **CutVec** 方向的深度值：



A - 质心

B - 深度

C - CutVec

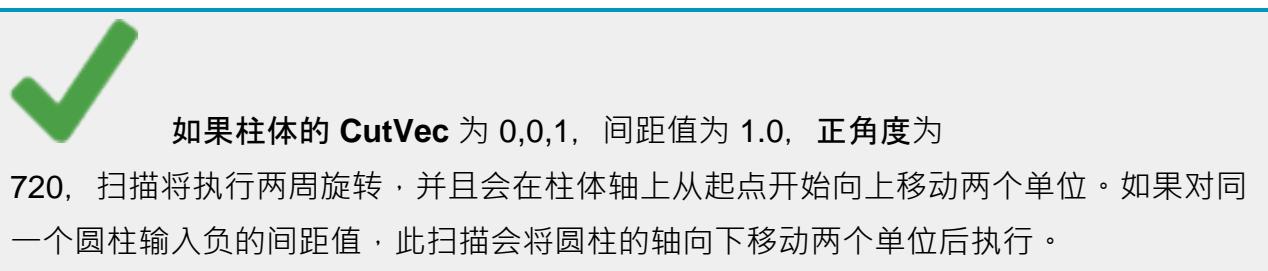


如果柱体的中心为 1,1,3, CutVec 为 0,0,1, 深度为 0.5, 柱体的中心将在执行时设置为 2.5。

螺距

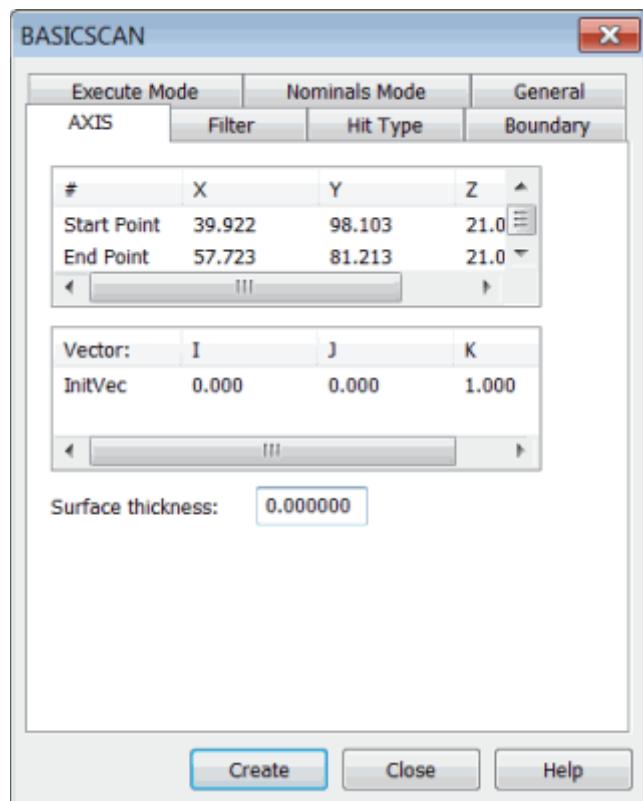
间距框显示完成 360 度旋转时 **CutVec**

方向上扫描开始和扫描结束之间的距离。圆柱的间距可为正值，也可为负值。当与 **CutVec** 组合时，角度会控制圆柱轴上下扫描的方向。



执行 轴 基本 扫描

要扫描直线特征，选择**插入 | 扫描 | 轴**。屏幕上将出现**基本扫描**对话框中的**轴**选项卡：



“基本扫描”对话框 - “轴”选项卡

此选项卡可采集直线的起点和终点，并允许您执行扫描。

轴方法：

- 允许使用**筛选器**选项卡上的**距离**选项。
- 允许使用**测点类型**选项卡上的**矢量**类型。
- 无需在**边界**选项卡上设置边界条件。

控制扫描执行的参数为：

- **起点**：此点为执行开始时的起点。
- **终点**：此点为执行结束时的终点。

您可直接键入点，或从测量机或 CAD 获得点。

定义轴基本扫描

您可使用以下方法之一定义轴基本扫描：

- 直接键入值。请参见“轴基本扫描 - 键入方法”。
- 对零件上的点进行物理测量。请参见“轴基本扫描 - 测量点方法”。
- 单击这些点对“图形显示”窗口内 CAD 模型的轴进行定义。请参见“轴基本扫描 - 曲面数据方法”或“轴基本扫描 - 线框数据方法”。

一旦创建扫描，PC-DMIS

会将其插入“编辑”窗口内。以下为轴基本扫描的命令行在“编辑”窗口中的示例：



```
SCN3 =BASICSCAN/AXIS,NUMBER OF HITS=10,SHOW  
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES  
<75.149,90.467,0>,<78.2,62.832,0>  
InitVec=0,0,1,THICKNESS=0,PROBECOMP=YES,AVOIDANCE  
MOVE=NO,DISTANCE=0
```

```

FILTER/DISTANCE , 2 . 54
EXEC MODE=FEATURE , USEHSSDAT=YES , USEDDELAYPNTS=NO
BOUNDARY/
HITTYPE/VECTOR
NOMS MODE=FINDNOMS , 10
ENDSCAN

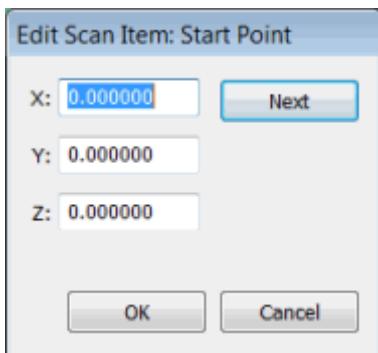
```

轴 基本 扫描 - 键 入 方法

使用此方法为轴基本扫描键入起点和终点的 X、Y 和 Z 值。

1. 在**基本扫描对话框 (插入 | 扫描 | 轴)** 中的 #

列中双击所需的点。屏幕上会出现**编辑扫描项对话框**：



编辑扫描项对话框

对话框的标题栏显示正在被编辑的具体参数的标识。

2. 编辑 X、Y 和 Z 值。
3. 要应用更改，单击**确定**。要取消更改并关闭对话框，单击**取消**。
4. 使用相同的程序编辑轴的 **CutVec** 和 **InitVec** 值。

有关**基本扫描对话框**和轴基本扫描的更多信息，请参见“执行轴基本扫描”。

轴 基本 扫描 - 测定 点 方法

要在不使用 CAD 数据的情况下生成直线，请执行以下步骤：

1. 选择**基本扫描对话框 (插入 | 扫描 | 轴)** 中列表中的所需点。

2. 在零件上采集一个测点。这将会填入该点的数值。

切割矢量是直线所在平面的法线矢量。

有关**基本扫描**对话框和轴基本扫描的更多信息，请参见“执行轴基本扫描”。

轴 基本 扫描 - 曲面 数据 方法

要使用曲面数据生成直线，请执行以下步骤：

1. 单击**曲面模式**图标。 
2. 从**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 轴**）中的列表选择**起点**。
3. 单击“图形显示”窗口中的零件定义起点。
4. 从对话框列表中选择**终止点**。
5. 单击“图形显示”窗口中的零件定义终点。

PC-DMIS 将会在此列表内填入所需的数值。

有关**基本扫描**对话框和轴基本扫描的更多信息，请参见“执行轴基本扫描”。

轴基本扫描 - 线框数据方法

线框 CAD 数据也可用于为直线生成点。

在轴上所需的线附近单击。PC-DMIS

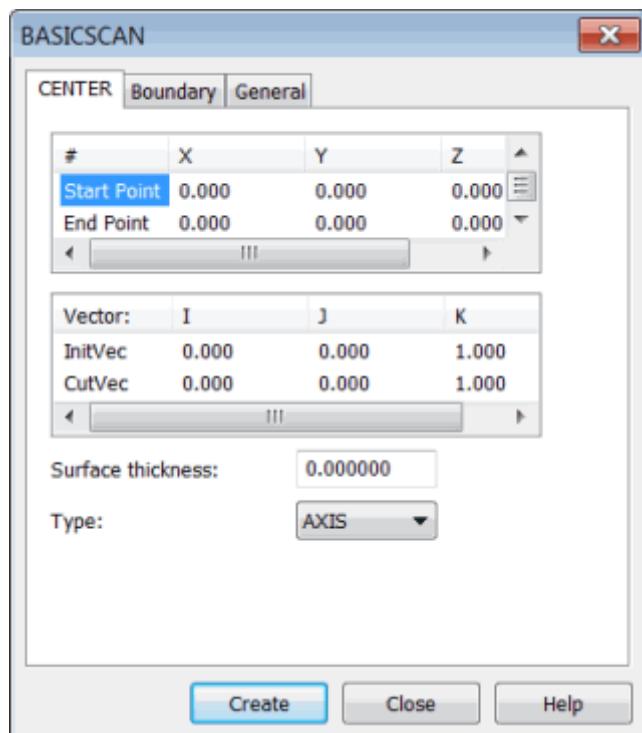
突出显示所有选择的线。同时也会在**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 轴**）的**起点**和**终点**项目中填入选定线的起点和终点。

切割矢量是直线所在平面的法线矢量。

有关**基本扫描**对话框和轴基本扫描的更多信息，请参见“执行轴基本扫描”。

执行 中心 基本 扫描

要查找区域中的低/高点，选择**插入 | 扫描 | 中心**。屏幕上将出现**基本扫描**对话框中的**中心**选项卡：



“基本扫描”对话框 - “中心”选项卡

此选项卡会采集扫描的起点和终点，并允许控制器执行扫描。此扫描的输出结果仅为一个单点。

对于置中方法，您无需在**边界**选项卡上设置边界条件。

以下参数控制扫描的执行：

- 起点**：此点为执行开始时的起点。
- 终点**：此点为执行结束时的终点。

您可直接键入点，或从测量机或 CAD 获得点。

定义中心基本扫描

您可使用以下方法之一定义中心基本扫描：

- 直接键入值。请参见“中心基本扫描 - 键入方法”。
- 对零件上的点进行物理测量。请参见“中心基本扫描 - 测量点方法”。
- 单击“图形显示”窗口内 CAD 模型上的点。请参见“中心基本扫描 - 曲面数据方法”或“中心基本扫描 - 线框数据方法”。

一旦创建扫描，PC-DMIS

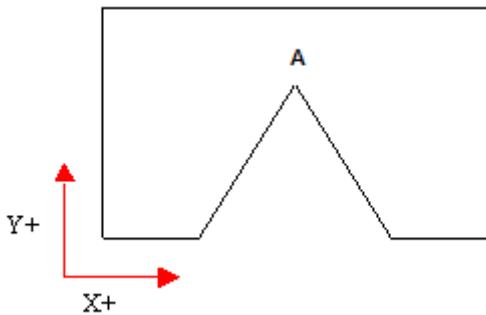
会将其插入“编辑”窗口内。以下为中心基本扫描的命令行在“编辑”窗口中的示例：



```
SCN4 =BASICSCAN/CENTER,NUMBER OF HITS=1,SHOW  
HITS=NO,SHOWALLPARAMS=YES  
<203.269,88.9,-12.418>,<203.269,90,-12.418>,CutVec=0,0,1,AXIS  
InitVec=0,-1,0,IN,THICKNESS=0,AVOIDANCE MOVE=NO,DISTANCE=0  
FILTER/DISTANCE,2.54  
EXEC MODE=RELEARN  
BOUNDARY/  
HITTYPE/VECTOR  
NOMS MODE=MASTER  
ENDSCAN
```

中心基本扫描示例

假设有一个 "V" 形块，这里的 "V" 处于测量机的 Y 轴上，"V" 的顶部处于零件坐标系统的 Y+ 方向：



V 形件的顶 (Z+) 视图 (“V”的顶点在 Y+ 方向)

A - 顶部

若要使用“平面”方法让中心基本扫描找到 "V" 的顶部，请执行下列操作：

1. 在要开始扫描的位置进行一次触测（在 V 的一个边上）。PC-DMIS 会利用 X、Y 和 Z 点信息填充基本扫描对话框（插入 | 扫描 | 中心）。
2. 对起点和终点值指定相同的 X、Y 和 Z 值。
3. 确保 **InitVec** 矢量为 0,-1,0。
4. 确保 **CutVec** 矢量为 0,0,1。
5. 从类型列表中选择平面。
6. 单击创建。PC-DMIS 沿“V”进行扫描查找其顶点，方法是沿起始矢量搜索最低点。

若要使用“轴”方法让中心基本扫描找到 "V" 的顶部，请执行下列操作：

1. 在要开始扫描的位置进行一次触测（在 V 的一个边上）。PC-DMIS 会利用 X、Y 和 Z 点信息填充扫描对话框。
2. 对起点和终点值指定相同的 X 和 Z 值。然后，将终点的 Y 值偏置至零件本身。
3. 确保 **InitVec** 矢量为 0,-1,0。
4. 确保 **CutVec** 矢量为 0,0,1。
5. 从类型列表中选择轴。
6. 单击创建。PC-DMIS 沿“V”进行扫描查找其顶点，方法是沿起始矢量搜索最低点。

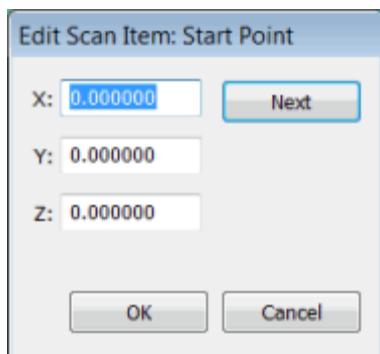
有关**基本扫描**对话框和中心基本扫描的更多信息，请参见“执行中心基本扫描”。

中心 基本 扫描 - 键入 方法

使用此方法为**中心基本扫描**键入起点和终点的 X、Y 和 Z 值。

1. 在**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 中心**）中的

列中双击所需的点。屏幕上会出现**编辑扫描项**对话框：



编辑扫描项对话框

该对话框的标题栏显示所编辑参数的 ID。

2. 编辑 X、Y 和 Z 值。

3. 要应用更改，单击**确定**。要取消更改并关闭对话框，单击**取消**。

4. 使用相同的程序编辑圆的中心 **CutVec** 和 **InitVec** 值。

有关**基本扫描**对话框和中心基本扫描的更多信息，请参见“执行中心基本扫描”。

中心 基本 扫描 - 测定 点 方法

若要在不使用 CAD 数据的情况下生成中心基本扫描：

1. 选择**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 中心**）中列表中的所需点。

2. 在零件上采集一个测点。这将会填入该点的数值。

CutVec

为平面的常规矢量，当控制器完成置中操作时测头将会在此平面内保持自由状态。**InitVec**
c 为处于起点处的初始接近矢量。

有关**基本扫描**对话框和中心基本扫描的更多信息，请参见“执行中心基本扫描”。

中心基本扫描 - 面数据方法

要使用曲面数据生成中心扫描，请执行以下步骤：

1. 单击**曲面模式**图标。 
2. 选择**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 中心**）中列表中的所需点。
3. 单击“图形显示”窗口中的某一位置。PC-DMIS 将会在此列表内填入所需的数值。

有关**基本扫描**对话框和中心基本扫描的更多信息，请参见“执行中心基本扫描”。

中心基本扫描 - 曲面数据方法

线框 CAD 数据也可用于生成点。

要生成点，在中心处的所需线周围单击。PC-DMIS

突出显示选择的线。它会在在线找到离点击位置最近的点，并在**基本扫描**对话框（**插入 | 扫描 | 中心**）中列表内填写数值。

- **CutVec**：此矢量为平面的常规矢量，当出现置中时测头会在此平面内保持自由。
- **InitVec**：此矢量为起点处测头的接近矢量。

类型

您可使用以下几种置中方法：

- 轴：起点 (S) 射影到定义轴 (A) 上。结果点是 (SP)。InitVec
 是由扫描平面上的扫描点 (SP) 以及轴向 (A) 定义的。因此方向点 (N)
 垂直于轴向。其后，将测头的中心点作为定心，仍然由轴的方向 (SP)

来定义。自定心作为与输入相同 / 相反的方向 (N), 测头方向与定义的轴 (A) 的交叉方向 (N) 是没有任何关系的。

S = 起始点

A = 定义的轴 / 轴向

SP = 预期起始点

N = 与轴向垂直的方向

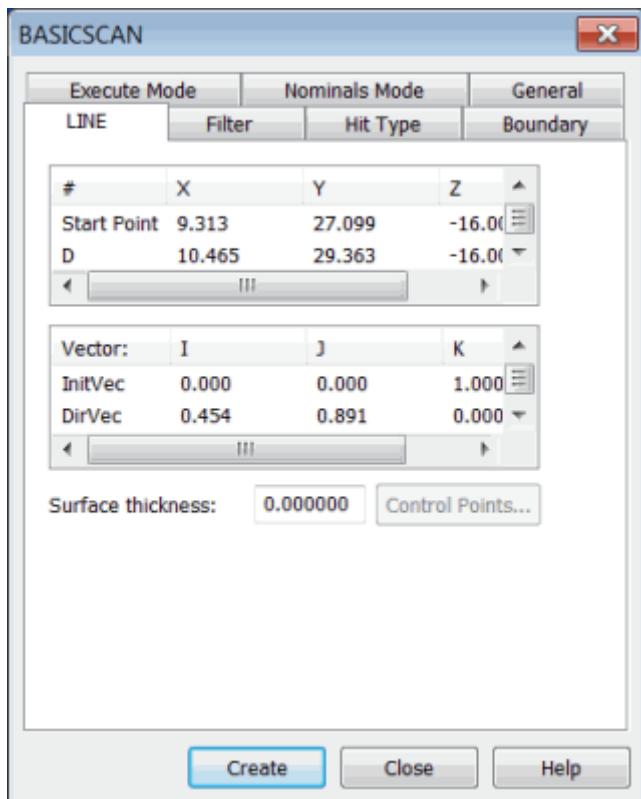
- **平面**：在 CMM 触测起点定义的点后，CMM 在保持于由 **CutVec** 定义的平面的同时，根据测头方向置中。

有关**基本扫描**对话框和中心基本扫描的更多信息，请参见“执行中心基本扫描”。

执行 直线 基本 扫描

要扫描直线上的曲面，请选择**插入 | 扫描 |**

直线。屏幕上将出现**基本扫描**对话框中的**直线**选项卡：



“基本扫描”对话框 - “直线”选项卡

此扫描需要起点、方向点和终点。它使用直线的起点和终点，并使用方向点计算切割平面。
• 执行扫描时测头将始终在切平面内。

直线基本扫描也使用下列执行的矢量：

- **InitVec**：在扫描过程中，初始接触矢量指定第一个点的曲面矢量。
- **CutVec**：切割平面矢量为 **InitVec** 与起点和终点间直线的交叉矢量。若无终点，则使用起点与方向点之间的线。
- **EndVec**：终止矢量为直线扫描终点处的逼近矢量。
- **DirVec**：方向矢量为从起点到方向点的矢量。

切割矢量是起始接触矢量与起点及终点间直线的差积。

定义直线基本扫描

1. 单击 # 列内的起点，然后在其上面双击以键入数值，或单击 CAD 模型以从选择的曲面中选择点。
2. 单击 # 列内的方向点 (D)，然后在其上面双击以键入数值，或单击 CAD 模型以从选择的曲面中选择点。
3. 单击 # 列内的终点，然后在其上面双击以键入数值，或单击 CAD 模型以从选择的曲面中选择点。
4. 根据需要修改矢量。
5. 根据需要在**基本扫描**对话框中填写任何其他选项卡上的选项，然后单击**确定**。PC-DMIS 将直线扫描插入“编辑”窗口内。

直线基本扫描在“编辑”窗口中的命令行为：

```
SCN5 =BASICSCAN/LINE, NUMBER OF HITS=16, SHOW  
HITS=NO, SHOWALLPARAMS=YES  
<194.592,96.658,0>,<208.587,92.377,0>,CutVec=0.2925585,0.956  
2476,0,  
DirVec=0.9562476,-0.2925585,0  
InitVec=0,0,1,EndVec=0,0,1,THICKNESS=0,PROBECOMP=YES,AVOIDAN  
CE MOVE=NO,DISTANCE=0  
FILTER/DISTANCE,1
```

执行模式=重新学习

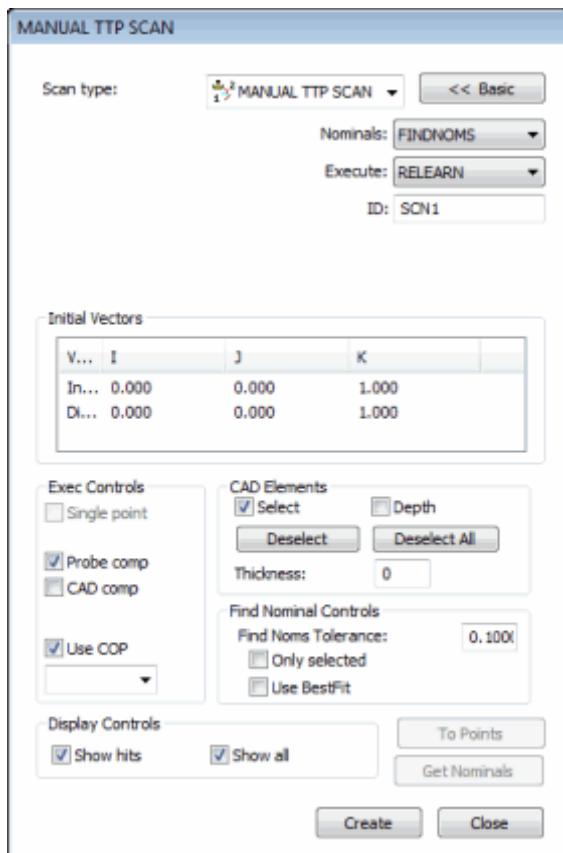
```
BOUNDARY/PLANE,<208.587,92.377,0>,PlaneVec=-  
0.9562476,0.2925585,0,Crossings=1
```

触测类型=矢量

```
NOMS MODE=NOM,10
```

终止扫描

手动执行扫描简介



手动扫描对话框

手动扫描方法允许您通过手动扫描零件的曲面定义点测量。当需要用户控制的 CMM 测量测点时，此扫描方法特别有用。

两种手动扫描

- 使用接触触发测头 (TTP) 的手动扫描
- 使用硬测头的手动扫描

要开始创建手动扫描，将 PC-DMIS 置于 **手动模式**



并从扫描子菜单可用手动扫描类型中选择。其中包括：

- 手动接触式触发测头（仅用于当你选择TTP时）
- 固定距离
- 固定时间

- 固定时间/距离
- 体轴
- 多段
- 手动自由

屏幕上将打开相应的手动扫描对话框。有关这些对话框中选项的一般信息，请参见 PC-DMIS 核心文档中的“扫描对话框的常用功能”一章。

手动扫描规则

以下主题描述了控制手动扫描的一般规则，以及针对标准水平和桥式坐标测量机以及臂式坐标测量机的规则。

手动扫描的一般规则

手动扫描应沿着测量机轴（X、Y 或 Z 轴）进行。例如，假设零件要求球体表面上的扫描。若要执行此扫描：

1. 锁定 Y 轴。通过使用 CMM

测量机上切换的锁可完成此操作。您可将此切换设置为“打开/关闭”，以阻止和允许特定轴内的运动。

2. 开始在 +X 方向上扫描。

3. 打开 Y 轴锁定，沿 +Y 或 -Y 移动至下一行。

4. 再次锁定 Y 轴

5. 以相反 (-X) 的方向扫描。

执行多行手动扫描时，建议每隔一条扫描线就反向。例如（继续上述的球体扫描）：

1. 在 +X 方向上开始扫描曲面。

2. 移至下一行，并沿 -X 轴进行扫描。
3. 根据需要，继续切换扫描的方向。内部的算法取决于这种规则性，如果不遵照这种方案，则可能导致较差的结果。

补偿限制



之前的版本中存在 **3D** 复选框，此复选框可让您以三维方式采集测点。从 4.0 版本开始，**3D** 复选框已删除。此时，无论何时使用硬测头执行支持的手动扫描，PC-DMIS 都会自动应用此功能。

使用固定距离扫描、固定时间/距离扫描和固定时间扫描，PC-DMIS 会自动让您沿任何方向上以三维方式采集手动测点。当使用轴无法锁定的自由移动手动 CMM 测量机（如 Romer 或 Faro 臂）进行扫描时，此功能相当有用。

因为您在任何方向移动测头，PC-DMIS 不能精确的从测量数据中确定测头补偿（或者输入和方向矢量）。

对于补偿的限制有两种解决办法：

- 如果存在 CAD 曲面，那么您可以从标称点列表选择查找标称点。PC-DMIS 将会在扫描中尝试查找每个测量点的标称值。如果找到标称值数据，将沿着找到的矢量补偿点。否则，将仍在球心。
- 如果 CAD 曲面不存在，则不会进行测头补偿。所有的数据都会停留在球中心，不会发生测头补偿。

使用标准水平和桥式坐标测量机的规则

如下说明包括您应遵循的规则，让手动扫描正确补偿，且标准水平和桥式 CMM 测量机具备更快的速度。

固定距离扫描、固定时间扫描和固定时间/距离扫描

- 您必须在扫描过程中锁定 CMM 的一条轴。PC-DMIS 将会在垂直于锁定轴的平面内执行扫描。
- 对于这三种类型的任何一种扫描，您可以在机器坐标系内键入 **InitVec** 和 **DirVec** 值。这样操作的原因是因为您正锁定其中一个机器轴。

体轴扫描

- 在扫描过程中，不应锁定任何轴。PC-DMIS 通过将测头交叉穿过主体轴位置处的键来执行扫描。每次测头交叉穿过此给定平面时，CMM 将会采集读数并将其传给 PC-DMIS。
- 对于此种类型的扫描，您需要在零件坐标系内键入 **InitVec** 和 **DirVec** 值。这样操作的原因因为测头可穿过指定的主体轴位置。
- 确保在零件坐标系中键入主体轴。

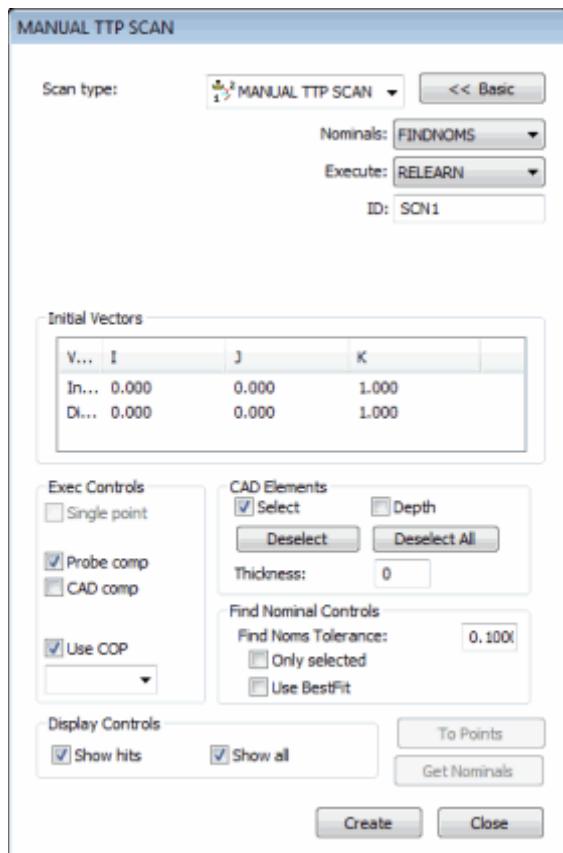
使用臂式坐标测量机（Gage 2000A、Faro、Romer）的规则

要在臂式 CMM 上正确地补偿手动扫描并达到更快的速度，应遵守以下所述的规则。

所有手动扫描类型

- 在扫描过程中，不应锁定任何轴。PC-DMIS 将把测头穿过主体轴位置中键入的平面，来进行扫描。每次测头交叉穿过此给定平面时，CMM 将会采集读数并将其传给 PC-DMIS。

- 对于此类扫描，必须在零件坐标系中键入 **InitVec** 和 **DirVec** 值。在结合使用主体轴位置时，必须执行该操作。
- 确保在零件坐标系中键入主体轴。**



手动触发测头扫描对话框

用接触式触发测头 (TTP) 执行手动扫描。操作如下：

- 将 PC-DMIS 置于手动模式。
- 访问**手动 TTP扫描对话框 (插入 / 扫描 / 手动 TTP)**。
- 定义必需的参数。
- 单击**创建**按钮。PC-DMIS 显示**执行对话框**并要求您采集测点。
- 按要求获得点**



6. 扫描结束时，在执行对话框中单击扫描完成按钮 ，停止扫描。



使用接触触发测头时，某些扫描方法将不可用。

使用硬测头执行手动扫描

必须使用硬测头访问四个测量方法。手动扫描提供可使用硬测头进行扫描的四种不同测量方法。在扫描过程中，PC-DMIS

会以控制器读取的速度尽可能快地收集测量的点。一旦完成扫描，PC-DMIS
会根据选择的扫描法提供减少所收集数据的能力。

使用硬测头的四个测量方法说明如下。



当使用接触触发测头时，PC-DMIS

会要求单个测点处于每个位置。它不会提供用于硬测头扫描的不同测量方法。

执行固定时间/距离手动扫描



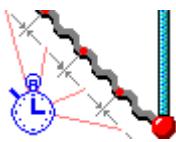
可变间隔对话框



在 PC-DMIS 从控制器接受另外一些测点之前，**插入 | 扫描 | 固定时间 | 距离**扫描方法允许您通过指定测头必须移动的距离以及所需消耗的时间，减少扫描内采集的测点数。

若要创建固定时间/距离（变量差量）扫描：

1. 访问间隔对话框的**变量**选项卡。
2. 若不想使用默认名称，请在**ID**框中指定扫描的自定义名称。
3. 在读数延时框中，键入 PC-DMIS 采集测点前必须经历的时间（单位为秒）。



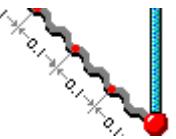
时间 (秒)

4. 在测点间距框中，键入 PC-DMIS

采集测点前需移动测头的距离。该距离是点与点之间的 3D 距离。



如果您键入 5，且测量单位为毫米，测头必须在 PC-DMIS
接受来自控制器的测点之前移动至少 5 毫米。



距离

5. 若使用的是 CAD

模型，请在**查找标称值控制区域**键入查找标称值公差。此操作可定义实际球心点离
标称 CAD 位置的距离。

6. 根据需要修改其它选项。

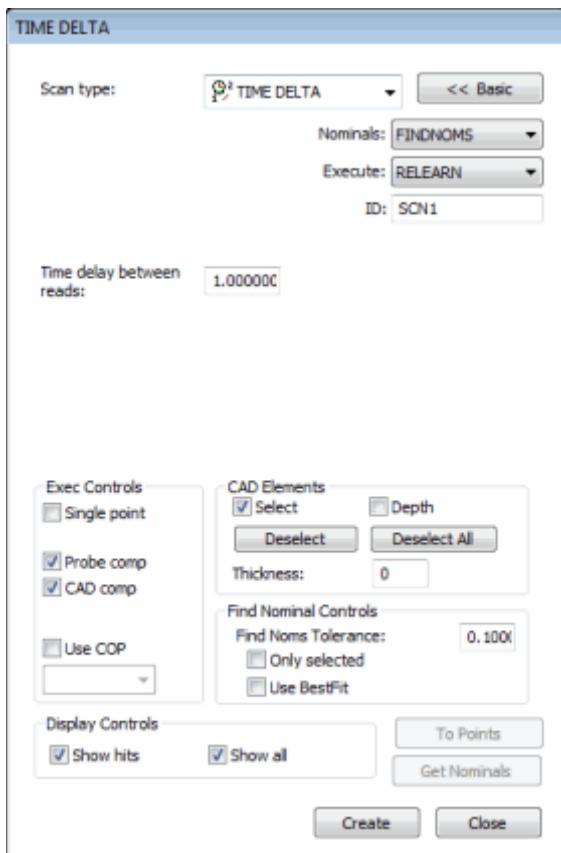
7. 单击**创建**。PC-DMIS 将插入基本扫描。

8. 执行测量程序。当 PC-DMIS 执行扫描时，将显示**执行选项**对话框。PC-DMIS 将等待控制器传回数据。

9. 手动拖动测头至待扫描的曲面上。PC-DMIS

会检查所用的时间以及测头移动的距离。当时间和距离超过指定数值的任何时候，
它将接受控制器传回的测点。

执行固定时间手动扫描



时间间隔对话框

通过扫描的插入 | 扫描 |

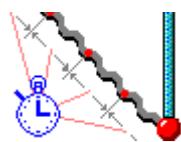
固定时间方法通过在读取时间延迟框中设置时间增量来减少扫描数据。PC-DMIS 将从第一个测点开始，通过删除读取速度快于指定时间延迟的测点来减少扫描数据。



若要创建固定时间（时间差量）扫描：

1. 打开时间差量对话框。
2. 若不想使用默认名称，请在 **ID** 框中指定扫描的自定义名称。

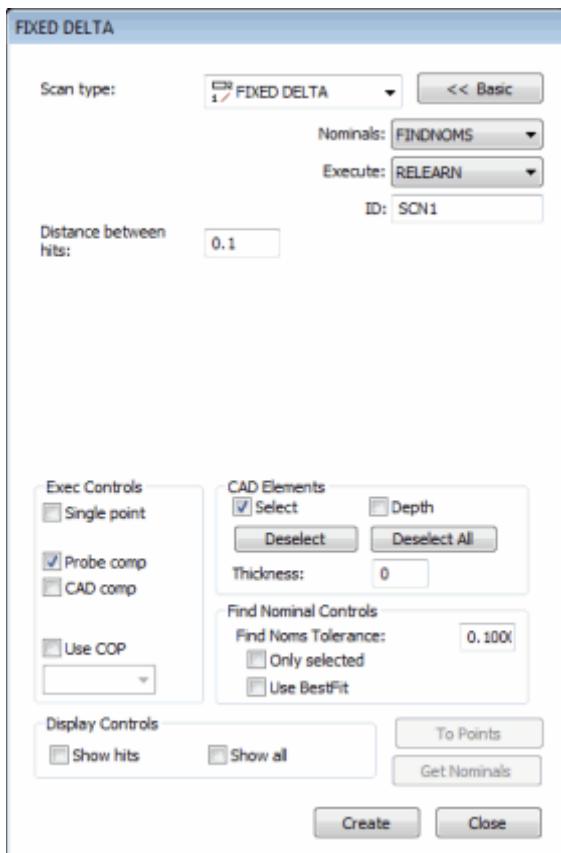
3. 在读数延时框中，键入 PC-DMIS 采集测点前必须经历的时间（单位为秒）。



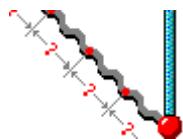
时间(秒)

4. 若使用的是 CAD 模型，请在**查找标称值控制区域**键入查找标称值公差。此操作可定义实际球心点离标称 CAD 位置的距离。
5. 根据需要修改其它选项。
6. 单击**创建**。PC-DMIS 将插入基本扫描。
7. 执行测量程序。当 PC-DMIS 执行扫描时，将显示**执行选项对话框**。PC-DMIS 将等待控制器传回数据。
8. 手动拖动测头至待扫描的曲面上。当所用时间超过**读数延时框内指定的数值**时，PC-DMIS 将接受来自控制器的测点。

执行固定距离手动扫描



固定间隔对话框



插入 | 扫描 |

固定距离扫描方法允许您通过设置测点间距框内的距离值减少测量的数据。PC-DMIS 将从第一个测点开始，通过删除比指定距离更接近的测点来减少扫描。从测量机获取数据时就会发生测点减少现象。PC-DMIS 仅保留大于指定增量的点。



要创建固定距离（差量）扫描：

1. 打开**固定差量**对话框。
2. 若不想使用默认名称，请在**ID**框中指定扫描的自定义名称。
3. 在**测点间距**框中，键入 PC-DMIS

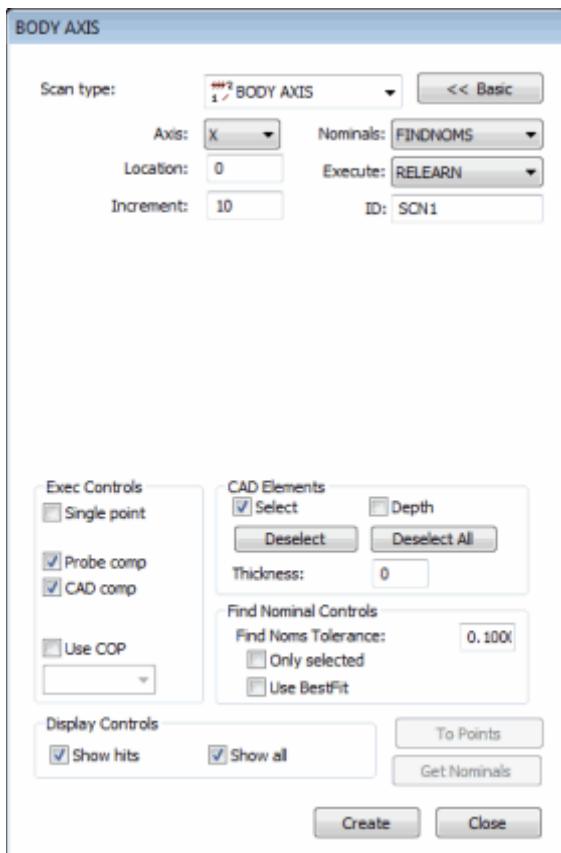
采集测点前需移动测头的距离。该距离是点与点之间的 3D 距离。

如果您键入 5，且测量单位为毫米，测头必须在 PC-DMIS

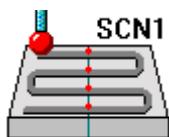
接受来自控制器的测点之前移动至少 5 毫米。

4. 若使用的是 CAD 模型，请在**查找标称值控制区域**键入查找标称值公差。此操作可定义实际球心点离标称 CAD 位置的距离。
5. 根据需要修改其它选项。
6. 单击**创建**。PC-DMIS 将插入基本扫描。
7. 执行测量程序。当 PC-DMIS 执行扫描时，将显示**执行选项**对话框。PC-DMIS 将等待控制器传回数据。
8. 手动拖动测头至待扫描的曲面上。PC-DMIS 将接受由控制器传回的，距离大于测点间距框中所指定的值的测点。

执行体轴手动扫描



体轴对话框



测头和扫描

通过指定某个零件轴上的切割平面并将测头拖动穿过切割平面，您可使用**插入 | 扫描 | 主体轴**扫描来扫描零件。当扫描零件时，您应使测头尽可能多地十字交叉穿过定义的切割平面。之后，PC-DMIS 会执行以下程序：

1. PC-DMIS

从控制器获取数据，并找到两个数据测点，这些测点在十字交叉穿过时的任何一边上最接近割平面。

2. 然后，PC-DMIS 将在刺穿切割平面的两个测点之间形成一条直线。

3. 刺穿点将成为切割平面上的测点（或触测）。

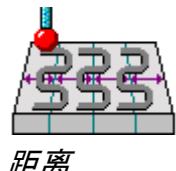
每次穿过切割平面时会发生此操作。最终，切割平面上将有许多测点。

通过指定割平面位置的一个增量，您可使用此法查看扫描的多个列（面片）。扫描第一行之后，PC-DMIS

会通过添加当前位置至增量将割平面移至下一个位置。然后，您可在新的割平面位置处继续扫描下一行。

若要创建主体轴向扫描：

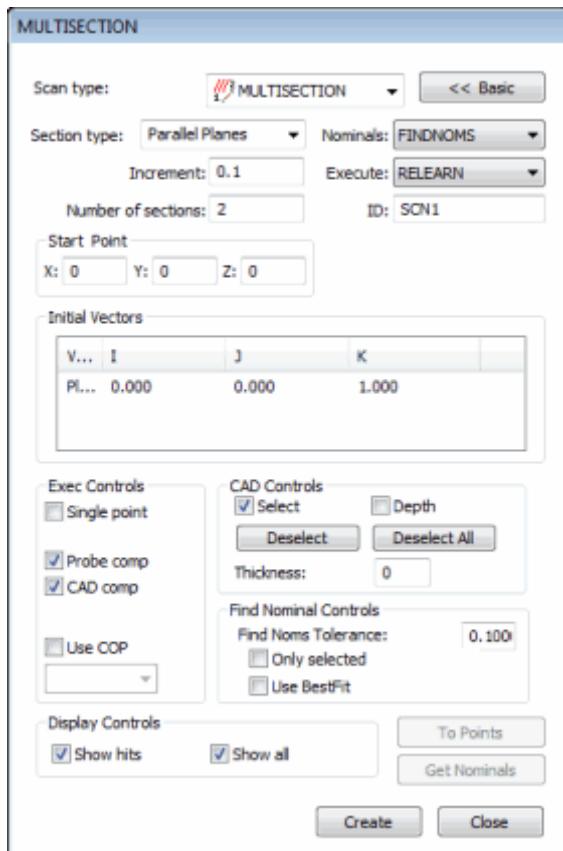
1. 打开**主体轴**对话框。
2. 若不想使用默认名称，请在**ID**框中指定扫描的自定义名称。
3. 从轴列表中选择轴。可用轴为 X、Y 和 Z。测头穿过的切割平面与该轴平行。
4. 在**位置**框中，指定到切割平面所在的定义轴的距离。
5. **增量**框，用于对多行扫描指定行距。



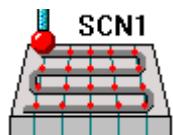
6. 若使用的是 CAD 模型，请在**查找标称值控制区域**键入查找标称值公差。此操作可定义实际球心点离标称 CAD 位置的距离。
7. 根据需要修改其它选项。
8. 单击**创建**。PC-DMIS 将插入基本扫描。
9. 执行测量程序。当 PC-DMIS 执行扫描时，将显示**执行选项**对话框。PC-DMIS 将等待控制器传回数据。
10. 在要扫描的曲面上来回手动拖动测头。当测头接近定义的切割平面时，您将会听到持续的可听音，此声音随间距而逐渐增大，直至测头穿过平面。此可听的线索可帮

助您确定测头接近切割平面的程度如何。每次测头穿过定义的平面时，PC-DMIS 将会接受来自控制器的测点。

执行多段手动扫描



多段对话框



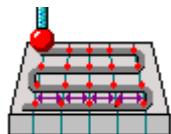
测头和扫描

插入/扫描/多截面扫描方式可以象体轴手动扫描，有这些不同：

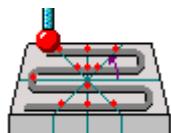
- 它可以通过许多个段。
- 不一定平行于X、Y、Z轴。

要创建多截面扫描：

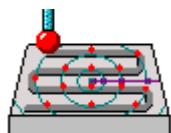
1. 打开**多截面对话框**。
2. 若不想使用默认名称，请在**ID**框中指定扫描的自定义名称。
3. 从**截面类型列表**中选择要扫描的截面类型。可用的类型包括：
 - - 这些截面是穿过部件的平面。每次测头穿过平面，PC-DMIS 都记录一个点。平面是相对于起点和方向矢量的。如果选择该类型，在**初始矢量区域**定义初始平面矢量。



- - 这些截面是从起点散发出来的平面。每次测头穿过平面，PC-DMIS 都会采一个点。如果选择该类型，在**初始矢量区域**定义两个矢量：



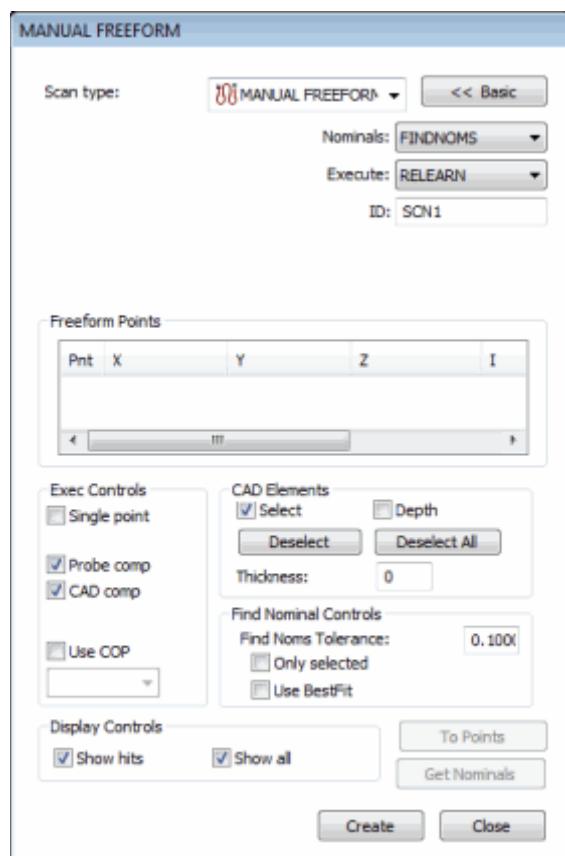
- -
 - 初始平面的矢量 (PlaneVec)
 - 平面旋转的矢量 (AxisVec)
- -
 - 这些截面为同心圆，以起始点为中心，距离起始点越远，圆的直径就越大。
 - 每次测头穿过圆，PC-DMIS 都会采一个点。如果选择该类型，在定义圆所在平面的**初始矢量区域**定义一个矢量（轴矢量）。



4. 在**段数**框中，键入在扫描中需要的截面数量。

5. 如果选择了至少两个截面，在**增量框**中确定截面之间的增量。对于平行平面和圆，此数值为平面间的距离。对于径向平面，此数值为角度。PC-DMIS 会自动在零件上间开这些截面。
6. 定义扫描的起点。在**起点区域**中输入 X、Y 和 Z 值。或者，单击零件让 PC-DMIS 从 CAD 图纸中选择起点。将从此临时点开始，根据增量值对这些截面进行计算。
7. 若使用的是 CAD 模型，请在**查找标称值控制区域**键入查找标称值公差。此操作可定义实际球心点离标称 CAD 位置的距离。
8. 根据需要修改其它选项。
9. 单击**创建**。PC-DMIS 将插入基本扫描。
10. 执行测量程序。当 PC-DMIS 执行扫描时，将显示**执行选项对话框**。PC-DMIS 将等待控制器传回数据。
11. 手动拖动测头至待扫描的曲面上。当测头接近每个截面时，您会听到随间距逐渐增大的持续声音，直至测头穿过截面。此可听声音有助于您确定测头离正在穿过的平面有多远。每次测头穿过定义的截面时，PC-DMIS 将会接受来自控制器的测点。

执行自由手动扫描



手动自由扫描对话框

插入 | 扫描 |

自由形状手动扫描可让您使用硬测头创建自由形状扫描。此扫描无需初始矢量或方向矢量，这与其他许多手动扫描类似。与其 DCC

对应部件类似，您创建自由形状扫描所需的操作为单击待扫描曲面上的点。

若要创建自由形状手动扫描：

1. 单击**高级>>**按钮，在此对话框底部显示选项卡。
2. 单击“图形显示”窗口中的零件曲面，以定义扫描路径。每次单击后，零件图纸上会出现一个橘色点。
3. 采集足够的点后，点击**创建**。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。

术语表

#

#: 个数

C

CCW: 逆时针方向

M

ms: 毫秒

T

TTP: 接触式触发测头

侧

侧头半径偏差: 侧头半径偏差。这是用于离散触测测量的偏差类型。

点

点: 点

毫

毫米: 毫米

离

离散触测:

离散触测是单独的触测测量。例如，对于一个测量的圆的离散触测数量是三。与扫描测量的区别主要包括更多取决于圆大小的触测和扫描的属性。

扫

扫描半径偏差: 扫描半径偏差。这是用于扫描类型测量的偏差类型。

顺

顺时针: 顺时针方向：

自

自动: 直接的计算机控制

索引

C	测量特征 224
Comment Dialog box 16	PC-DMIS 测量机 教程 3
E	Q
Execute 22	QuickMeasure 217
F	S
Feature	SP600
measuring 10	校验过程 57
L	校验信息 53
Level 17	T
Level D2HBLevel13 12	TempComp 命令 66
N	使用温度传感器 62
New Part Program Dialog box 7	测量温度探测点 66
O	TTP 平面圆策略
On-line 5	选择测点选项卡 212
P	描述 209
PC-DMIS 测量机 1	TTP 平面圆策略: 209, 210, 214
入门 2	TTP 自由形状平面策略
扫描 298	示教路径示例 196
创建及使用测头 32	执行选项卡 208
创建坐标系 223	选择测点选项卡 202
测头工具框 73	

描述 185	创建一个温度测头文件 63
TTP 自由形状平面策略: 186, 204	类型 62
TTP 策略 185	平均温度 66
三划	平面 228, 264
工具栏 217	凹口槽 280
QuickMeasure 217	矢量点 66, 236
四划	外推测量法 66
无效探测 107	六划
中心基本扫描 361	执行选项卡
手动扫描 369	TTP 自由形状平面策略 208
方槽 235, 276	自定心点策略 184
计量扫描过滤	自适应自由形状平面扫描策略 163
启用 177	扫描 298
补偿类型 175	手动扫描 369
量规扫描校准策略 174	自由曲面 386
计量扫描过滤: 175	多截面 383
计量扫描校准策略的结果文件 174	体轴 380
五划	规则 370, 372
可更换式温度传感器	固定时间 376
工具架 68	固定时间/距离 374
	固定距离 378

接触式触发扫描	373	圆柱	351
硬测头扫描	374	扫描策略	
高级扫描	299, 333	TTP	185
UV扫描	326	自适应扫描	122
开线扫描	300	非自适应	174
边界	312	曲面点	240
曲面	309	自动特征	119, 235
自由曲面	324	方槽	276
闭线	304	平面	264
栅格扫描	330	凹口槽	280
部分切割	333	矢量点	236
旋转扫描	320	曲面点	240
截面扫描	316	自动直线	258
部分切割	333	多边形	285
创建	338	角度点	251
部分切割对话框描述	335	圆	267
基本扫描	344	圆柱	289
中心扫描	361	圆锥	293
坐标轴	357	圆槽	273
直线	367	高点	254
圆	345		

球体 296	自适应扫描策略 122
隅角点 248	自适应自由形状平面扫描策略
棱点 244	示教路径示例 152
椭圆 270	执行选项卡 163
自学习路径	扫描路径选项卡 159
TTP 自由形状平面策略示例 196	描述 140
自适应自由形状平面扫描策略示例 152	筛选器选项卡 141
自定心点策略	自适应自由形状平面扫描策略: 140, 141, 142
执行选项卡 184	自适应线性扫描策略
描述 181	描述 137
自定心点策略: 181	筛选器选项卡 139
自适应平面线扫描策略	自适应线性扫描策略: 138
描述 171	自适应圆扫描策略
筛选器选项卡 173	计量扫描过滤 175, 177
自适应平面线扫描策略: 172	计量扫描校准 174
自适应平面圆扫描策略	高级选项卡 124
描述 164	描述 123
筛选器选项卡 166	自适应圆扫描策略: 123, 125, 126
自适应平面圆扫描策略: 164, 165, 167, 168	自适应圆柱同心圆扫描策略

计量扫描过滤 175, 177
计量扫描校准 174
自适应圆柱线扫描策略
 描述 132
 筛选器选项卡 134
自适应圆柱线扫描策略: 132, 133
自适应圆柱螺旋扫描策略
 描述 134
 筛选器选项卡 137
自适应圆柱螺旋扫描策略: 135, 136
自适应圆锥同心圆扫描策略
 高级选项卡 128
 描述 127
自适应圆锥同心圆扫描策略: 127, 129
自适应圆锥线扫描策略
 高级选项卡 131
 描述 130
自适应圆锥线扫描策略: 130, 131
多个温度测量 66
多边形 285
七划
角度点 251
八划
直线 228, 258
非自适应扫描策略 174
非持续接触温度传感器 62
固定式温度传感器
工具架 68
创建一个温度测头文件 63
类型 62
使用自适应扫描策略 122
使用测量策略 119
定义测头 33
星型测头 25
接触式测头 33
硬测头 35
九划
持续接触温度传感器 62
柱体基本扫描 351, 356

CAD 数据方法	356	方槽	235
轴基本扫描	357	平面	228
点	227, 236, 240, 244, 248, 251, 254	直线	228
选择测点选项卡		点	227
TTP 平面圆策略	212	圆	229
TTP 自由形状平面策略	202	圆柱	230
测头工具框		圆锥	231
关联自动移动属性	107	圆槽	234
关联查找孔属性	109	球体	232
进行触测	79	测量策略	
更改测头	77	TTP	185
连接路径属性	84	自适应扫描	122
删除点	79	非自适应扫描	174
点模式	79	使用	119
选择测量策略	119	标签	73
样例点属性	90	选择策略	73
读出窗口模式	79	测量温度分配	66
察看测头读出窗口	79	十划	
测量点	66, 227	校验	
测量特征	226	SP600	53, 57

测头尖 36
模拟测头 53, 57
圆 229, 267
圆柱 230, 289
圆柱定心螺纹扫描策略 179
圆基本扫描
CAD 数据方法 349
CutVec 345
InitVec 345
执行 345
扫描 345
曲面数据方法 348
质心 345
定义 345
线框数据方法 349
测定点方法 348
基本扫描对话框 345
键入方法 347
圆基本扫描的 CAD 数据方法 349
圆基本扫描的 CutVec 345
圆基本扫描的 InitVec 345
圆基本扫描的曲面数据方法 348
圆基本扫描的质心 345
圆基本扫描的线框数据方法 349
圆基本扫描的测定点方法 348
圆基本扫描的键入方法 347
圆槽 234, 273
高点 254
十一划
球体 232, 296
教程 3
基本扫描 344
基本扫描对话框
中心基本扫描 361
柱体基本扫描 351
轴基本扫描 357
圆基本扫描 345
基本直线扫描 367
基本直线扫描 367
盘测针的校验注释和程序 56
隅角点 248
十二划
棱点 244
椭圆 270

量规扫描校准策略	温度测头
启用计量扫描筛选器 177	使用工具架 68
补偿类型 175	编辑组件 65
结果文件 174	温度测头文件 63
描述 174	温度探测点
量规扫描校准策略: 175, 178	可更换式温度传感器 62
温度传感器	测量 66
创建一个温度测头文件 63	编辑测头组件对话框 65
使用 62	编辑温度测头组件 65
使用带有工具架的温度测头 68	十四划
类型 62	截面
测量温度探测点 66	对话框 335
编辑温度测头组件 65	创建 338
温度补偿 62	使用 333

